71M6543F/H 和 71M6543G/GH 电表 IC

数据资料

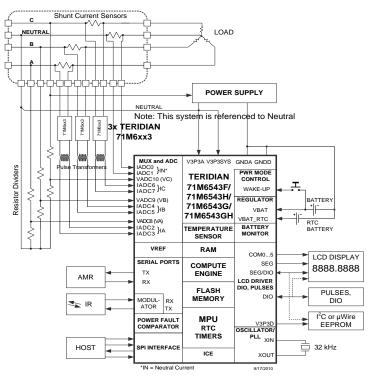
2011年4月

概述

71M6543F、71M6543H、71M6543G 和 71M6543GH 是 Teridian 的 第 4 代多相电表片上系统(SoC),包括: 8051 兼容 MPU、带有数字 补偿的低功耗实时时钟(RTC)、闪存存储器和 LCD 驱动器。采用我们的单转换器技术(Single Converter Technology®),内置一路 22 位 Σ - Δ ADC 数字温度传感器、七路模拟输入、数字温度补偿、精密电压基准和 32 位计算引擎(CE),只需少数外部元件即可支持各种电表设计。

71M6543F、71M6543H、71M6543G和71M6543GH支持71M6xx3系列隔离传感器的接口选项,有效降低BOM成本、提高抗电磁干扰能力,进而增强系统可靠性。器件特性包括:超低功耗有效工作和电池供电模式、5KB公用RAM和64KB(71M6543F、71M6543H)或128KB(71M6543G、71M6543GH)闪存存储器(电表工作期间可编程程序和/或数据)。较强的处理能力、较高的采样速率,结合差分输入级,提供强大的计量功能,理想用于0.2精度等级的商业电表和工业电表设计(71M6543H、71M6543GH)。

完整的软件开发工具、演示程序以及参考设计有助于加速计量产品的 开发和认证,以满足 ANSI、IEC 等全球范围的电表计量标准。



Single Converter Technology 是 Maxim Integrated Products, Inc.的注册商标。 MICROWIRE 是 National Semiconductor Corp.的商标。

特性

- 2000:1 电流范围内, 精度高达 0.1%
- 优于 IEC 62053/ANSI C12.20 标准要求
- 带有零相电流测量的七路传感器输入,电流输入可选择差分模式
- 一路电流输入可选择增益 1 或 8, 支持分流器
- 高速 Wh/VARh 脉冲输出,可编程脉冲宽度
- 64KB 闪存、5KB RAM (71M6543F/H)
- 128KB 闪存、5KB RAM (71M6543G/GH)
- 多达四路脉冲输出,带有脉冲计数
- 四象限表计,支持相排序
- 数字温度补偿:

计量补偿

高精度 RTC 用于晶振自动温度补偿的 TOU 功能,支持所有功率模式

- 独立的 32 位计算引擎
- 46-64Hz 电网频率范围,采用相同校准
- 相位补偿(±7°)
- 三种备份电池供电模式:

掉电模式

LCD 模式

休眠模式

- 引脚事件唤醒和定时器唤醒
- 休眠模式电流损耗仅为 1μA
- 闪存加密
- 在系统编程
- 8 位 MPU (80515), 高达 5 MIPS
- 掉电模式下的全速 MPU 时钟
- LCD 驱动器:
 - 6个公共段驱动器

多达 56 个可选引脚

- 多达 51 个多功能 DIO 引脚
- 硬件看门狗定时器(WDT)
- I²C/MICROWIRE™ EEPROM 接口
- 通过 SPI 接口提供闪存编程
- 两个 UART 用于 IR 和 AMR
- IR LED 调制驱动器
- 工业级温度范围
- 100 引脚无铅 LQFP 封装

目录

硬件	说明	
2.1	硬件概述	
2.2	模拟前端(AFE)	
	2.2.1 信号输入引脚	
	2.2.2 输入复用器	
	2.2.3 延时补偿	
	2.2.4 ADC前置放大器	
	2.2.5 A/D转换器(ADC)	
	2.2.6 FIR滤波器	
	2.2.7 电压基准	
	2.2.8 71M6xx3 隔离传感器接口	
2.3	数字计算引擎(CE)	
	2.3.1 CE程序存储器	
	2.3.2 CE数据存储器	
	2.3.3 CE与MPU通信	
	2.3.4 电表公式	
	2.3.5 实时监测器(RTM)	
	2.3.6 脉冲发生器	
	2.3.7 CE功能综述	
2.4	80515 MPU核	
	2.4.1 存储器架构和寻址	
	2.4.2 特殊功能寄存器(SFR)	
	2.4.3 通用 80515 特殊功能寄存器	
	2.4.4 指令集	
	2.4.5 80515 低功耗模式	
	2.4.6 UART	
	2.4.7 定时器和计数器	
	2.4.8 WD定时器(软件看门狗定时器)	
	2.4.9 中断	
2.5	片上资源	
	2.5.1 物理存储器	
	2.5.2 振荡器	
	2.5.3 PLL和内部时钟	
	2.5.4 实时时钟(RTC)	
	2.5.5 71M6543 温度传感器	
	2.5.6 71M6xx3 温度传感器	
	2.5.7 71M6543 电池监测器	
	2.5.8 71M6xx3 VCC检测器	
	2.5.9 UART和光接口	
	2.5.10 数字I/O和LCD段驱动器	
	2.5.11 EEPROM接口	
	2.5.12 SPI从机端口	
	2.5.13 硬件看门狗定时器	
	2.5.14 测试端口(TMUXOUT和TMUX2OUT引脚)	

	3.1	工作原理	75
	3.2	电池供电模式	75
		3.2.1 BRN模式	78
		3.2.2 LCD模式	78
		3.2.3 SLP模式	79
	3.3	故障和复位操作	80
		3.3.1 掉电事件	80
		3.3.2 低电池电压下的IC	81
		3.3.3 复位序列	81
		3.3.4 看门狗定时器(WDT)复位	81
	3.4	唤醒操作	82
		3.4.1 硬件唤醒	82
		3.4.2 定时器唤醒	84
	3.5	数据流和MPU/CE通信	84
4	应用	信息	86
	4.1	连接 5V器件	86
	4.2	直接连接传感器	86
	4.3	使用 71M6xx3 隔离传感器和分流器的系统架构	87
	4.4	使用电流变压器的系统 架构	88
	4.5	计量温度补偿	89
		4.5.1 标准和高精度器件的区别	89
		4.5.2 71M6543F和 71M6543G温度系数	90
		4.5.3 71M6543H和 71M6543GH的温度系数	
		4.5.4 71M6xx3 的温度系数	90
		4.5.5 VREF和分流传感器的温度补偿	90
		4.5.6 VREF和电流变压器的温度补偿	92
	4.6	连接I ² C EEPROM	94
	4.7	连接 3 线EEPROM	94
	4.8	UART0 (TX/RX)	
	4.9	光接口(UART1)	
		连接复位引脚	
		连接仿真器端口	
	4.12	闪存编程	
		4.12.1 通过ICE端口编程闪存	
		4.12.2 通过SPI端口编程闪存	
		MPU演示程序	
		晶振	
		电表校准	
5		接口	
	5.1	I/O RAM映射—按功能排序	
	5.2	I/O RAM映射—按字母排序	
	5.3	读信息页(71M6543H和 71M6543GH)	
	5.4	CE接口说明	
		5.4.1 CE程序	
		5.4.2 CE数据格式	
		5.4.3 常量	
		5.4.4 环境	
		5.4.5 CE计算	121

		5.4.6	CE前端数据(原始数据)	122
		5.4.7	CE状态和控制	123
		5.4.8	CE传输变量	125
		5.4.9	脉冲发生	127
		5.4.10	CE校准参数	130
		5.4.11	CE流程图	131
6	71M	6543 电	气规格	133
	6.1	绝对最	大额定值	133
	6.2	推荐外	部元件	134
	6.3	推荐工	作条件	134
	6.4	性能指	标	135
		6.4.1	输入逻辑电平	135
		6.4.2	输出逻辑电平	135
		6.4.3	电池监测器	136
		6.4.4	温度监测器	137
		6.4.5	电源电流	138
		6.4.6	V3P3D开关	139
		6.4.7	内部电源故障比较器	
		6.4.8	2.5 V稳压器—系统电源	
			2.5 V稳压器—电池供电	
			晶振	
			锁相环(PLL)	
			LCD 驱动器	
			VLCD发生器	
			71M6543 VREF	
		6.4.15	ADC转换器	144
		6.4.16	IADC0-IADC1 的前置放大器	145
	6.5	时序规	格	146
		6.5.1		
		6.5.2	SPI从机	146
			EEPROM接口	
			RESET引脚	
			实时时钟(RTC)	
	6.6		脚LQFP封装图	
	6.7		43 引脚图	
	6.8		43 引脚说明	
			71M6543 电源和接地引脚	
			71M6543 模拟电路引脚	
			71M6543 数字电路引脚	
			I/O等效电路	
7	定购		70 (7)% СРД	
-	7.1		43 选型指南	
8	相关		- C = 3 11 1 1 1 1 1 1 1 1	
9				
-				

图	
图 1. IC功能框图	9
图 2. AFE 方框图(分流器:一个本地传感器、三个远端传感器)	12
图 3. AFE 原理框图 (四个 CT)	
图 4. 复用帧状态(MUX_DIV[3:0] = 6)	17
图 5. 复用帧状态(MUX_DIV[3:0] = 7)	17
图 6. 斩波放大器通用拓扑	21
图 7. CROSS信号, <i>CHOP_E</i> = 00	21
图 8. RTM时序	26
图 9. 脉冲发生器FIFO时序	28
图 10. 复用周期内采样(帧)	29
图 11. 累积间隔	29
图 12. 中断结构	46
图 13. 自动温度补偿	54
图 14. 光接口	58
图 15. 光接口(UART1)	58
图 16. 连接外部负载至DIO引脚	60
图 17. LCD波形	65
图 18.3 线接口: 写命令,HiZ=0	67
图 19.3 线接口: 写命令,HiZ=1	68
图 20.3 线接口: 读命令	68
图 21.3 线接口: 写命令, CNT=0	68
图 22. 3 线接口: 写命令,HiZ=1,WFR=1	68
图 23. SPI从机端口—典型的多字节读、写操作	70
图 24. 电压、电流、瞬时能量和累积能量	
图 25. 工作模式状态图	
图 26. MPU/CE数据流	
图 27. 电阻分压(电压检测)	
图 28. 单端输入CT (电流检测)	
图 29. 差分输入CT (电流检测)	
图 30. 差分输入锰铜分流器(电流检测)	
图 31. 使用三个远端和一个本地(零相)传感器的系统架构	
图 32. 使用电流变压器的系统	
图 33. I ² C EEPROM连接	
图 34. UART0 连接	
图 35. 光元件连接	
图 36. RESET引脚外部电路: 按钮(左侧)、生产电路(右侧)	
图 37. 仿真器接口的外部电路	
图 38. 熔丝位映射	
图 39. CE数据流: 复用器和ADC	
图 40. CE数据流:单相的缩放、增益控制、中间变量	
图 41. CE数据流:平方、求和运算级	
图 42. 100 引脚LQFP封装图	
图 43. LQFP-100 封装引脚排列	
图 44. I/O等效电路	154

表

表 1. CE代码和设置(1 个本地/3 个远端传感器)	15
表 2. CE 代码和设置(CT 传感器)	16
表 3. 复用器和 ADC 配置位	19
表 4. RCMD[4:0] 位	23
表 5. 远程接口读命令	23
表 6. 用于远端传感器的I/O RAM控制位	24
表 7. 复用器输入选择	26
表 8. CKMPU时钟频率	30
表 9. 存储器映射	
表 10. 内部数据存储器映射	32
表 11. 特殊功能寄存器映射	32
表 12. 通用 80515 SFR—地址和复位值	
表 13. PSW位功能(SFR 0xD0)	34
表 14. 端口寄存器(SEGDIO0-15)	35
表 15. 展宽存储周期宽度	35
表 16. 80515 PCON SFR寄存器(SFR 0x87)	
表 17. 波特率发生器	36
表 18. UART模式	
表 19. SOCON (UARTO)寄存器(SFR 0x98)	
表 20. SICON (UART1)寄存器(SFR 0x9B)	
表 21. PCON寄存器位说明(SFR 0x87)	38
表 22. 定时器/计数器模式说明	39
表 23. 定时器/计数器模式组合	
表 24. TMOD寄存器位说明(SFR 0x89)	
表 25. TCON寄存器位功能(SFR 0x88)	
表 26. IENO 位功能(SFR 0xA8)	41
表 27. IENI 位功能(SFR 0xB8)	
表 28. IEN2 位功能(SFR 0x9A)	41
表 29. TCON位功能(SFR 0x88)	
表 30. T2CON位功能(SFR 0xC8)	
表 31. IRCON位功能(SFR 0xC0)	
表 32. 外部MPU中断	
表 33. 中断使能和标识位	
表 34. 中断优先级组	
表 35. 中断优先级	
表 36. 中断优先级寄存器(IPO 和IPI)	
表 37. 中断轮询排序	
表 38. 中断向量	
表 39. 闪存访问	
表 40. 71M6543G/GH中利用FL_BANK[1:0] (SFR 0xB6[1:0])进行存储区切换	
表 41. 闪存加密	
表 42. 时钟系统汇总	
表 43. RTC控制寄存器	
表 44. 用于RTC温度补偿的I/O RAM寄存器	53

表 45.	. 用于RTC中断的I/O RAM寄存器	55
表 46.	. 用于温度和电池测量的I/O RAM寄存器	56
表 47.	. 通过DIO_Rn[2:0]位的能够选择的资源	59
表 48.	. SEGDIO0 至SEGDIO15 数据/方向寄存器及内部资源	60
表 49.	. SEGDIO16 至SEGDIO31 数据/方向寄存器	61
表 50.	. SEGDIO32 至SEGDIO45 数据/方向寄存器	61
表 51.	. SEGDIO51 至SEGDIO55 数据/方向寄存器	61
表 52.	. LCD_VMODE配置	63
表 53.	. LCD配置	64
表 54.	. SEGDIO46 至SEGDIO55 LCD数据寄存器	65
表 55.	. 2 线接口对应的 <i>EECTRL</i> 位	66
表 56.	. 3 线接口对应的 <i>EECTRL</i> 位	67
表 57.	. SPI操作字段	69
表 58.	. SPI命令时序	70
表 59.	. SPI 寄存器	70
表 60.	. <i>TMUX[4:0]</i> 选择	73
•	. <i>TMUX2[4:0]</i> 选择	
	. 电路功能	
表 63.	. VSTAT[2:0] (SFR 0xF9[2:0])	80
	. 唤醒使能和标识位	
	. 唤醒位	
	. WAKE标识清除事件	
	. GAIN_ADJn补偿通道(图 2、图 31、表 1)	
	. GAIN_ADJx补偿通道(图 3、图 32、表 2)	
	. I/O RAM映射—按功能排序,基本配置	
	. I/O RAM映射—按功能排序	
	. I/O RAM映射—按字母排序	
	. 信息页熔丝调整	
	. CE <i>EQU[2:0]</i> 公式和单元输入映射	
	. CE原始数据访问地址	
	. CESTATUS 寄存器	
	. CESTATUS位定义	
	. CECONFIG寄存器	
	. CECONFIG位定义(CE RAM 0x20)	
	. 电压跌落门限、相测量和增益调节控制	
	. CE传递变量(含分流器)	
	. CE传递变量(CT)	
	. CE能量测量变量(含分流器)	
	. CE能量测量变量(CT)	
	. 其它传递变量	
	CE脉冲参数	
	. 用于噪声抑制和代码版本的CE参数	
	. CE校准参数	
	. 绝对最大额定值	
表 89.	. 推荐外部元件	. 134

表 90. 推荐工作条件	134
表 91. 输入逻辑电平	135
表 92. 输出逻辑电平	135
表 93. 电池监测器技术指标(TEMP_B	AT = 1)
表 94. 温度监测器	137
表 95. 电源电流指标	138
表 96. V3P3D开关性能指标	139
表 97. 内部电源故障比较器性能指标	139
表 98. 2.5V稳压器性能指标	139
表 99. 低功耗稳压器性能指标	140
表 100. 晶振性能指标	140
表 101. PLL性能指标	140
表 102. LCD驱动器性能指标	140
表 103. VLCD发生器技术指标	141
表 104. 71M6543 VREF性能指标	143
表 105. ADC转换器性能指标	144
表 106. 前置放大器性能指标	145
表 107. 闪存时序指标	146
表 108. SPI从机时序指标	146
表 109. EEPROM接口时序	146
表 110. RESET引脚时序	147
表 111. RTC的日期范围	147
表 112. 71M6543 电源和接地引脚	150
表 113. 71M6543 模拟电路引脚	151
表 114. 71M6543 数字电路引脚	152
表 115. 71M6543 选型指南	155

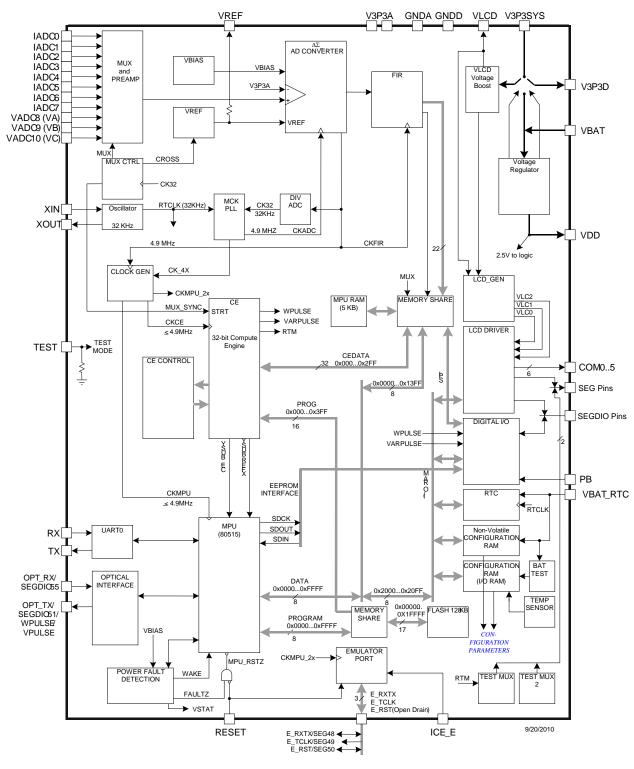


图 1. IC 功能框图

1 引言

本数据资料介绍 71M6543F (64KB, 0.5%)、71M6543H (64KB, 0.1%)、71M6543G (128KB, 0.5%)和 71M6543GH (128KB, 0.1%)第四代 Teridian 多相电表片上系统(SoC)。以下讨论适用于所有器件特性或性能时,将用 "71M6543"表示;讨论内容仅适用于特定型号的特性或性能时,将标明相应型号。本数据资料还介绍了配套的 71M6xx3 隔离电流传感器的基本信息。

本文介绍了 71M6543 配合 71M6xx3 隔离电流传感器的使用方法。71M6543 配合 71M6xx3 IC,可以利用低成本分流电阻,使用一个非隔离和三个隔离电流传感器构建多相电表,获得这类传感器技术前所未有的性能。71M6543 SoC 还支持电流变压器(CT)配置。

为方便阅读,本文采用超级链接,链接到相关的参考图、表格和章节。本文所有超级链接均以蓝色突出显示。文中使用了大量的超级链接,提供详细的参考内容,以增强每一部分的细节描述。此外,本文制作成书签 PDF 格式,便于浏览。

建议读者参考本文第 155 页 8 相关信息部分列出的文件。

2 硬件说明

2.1 硬件概述

Teridian 71M6543 单芯片计量 IC 集成了实现固态电表所需的全部功能模块,包括:

- 模拟前端(AFE), 具有 22 位二阶 Σ-Δ ADC
- 独立的 32 位 DSP 数字计算引擎(CE),实现计量功能
- 8051 兼容微处理器(MPU),每个时钟周期执行一条指令(80515)
- 精密电压基准(VREF)
- 用于数字温度补偿的温度传感器:
 - 计量(MPU)
 - 所有功率模式下,自动补偿 RTC
 - MPU 辅助 RTC 补偿
- LCD 驱动器
- RAM 和闪存
- 实时时钟(RTC)
- 多种 I/O 引脚
- 电源故障中断
- 讨零中断
- 可选的电流传感器接口,用于本地连接传感器及远端传感器(即使用带有检流电阻的 71M6xx3 配套 IC)
- 支持锰铜分流器和电流变压器

为了构建带有或不带零相电流测量功能的多相电表,可直接将一个电阻分流器电流传感器连接至 71M6543 器件(非隔离方案),而采用配套的 71M6xx3 隔离传感器 IC 隔离另外三个分流器。采用低成本、小尺寸脉冲变压器电气隔离 71M6xx3 远端传感器与 71M6543。71M6543 与 71M6xx3 进行双向数字通信,并通过隔离脉冲变压器为 71M6xx3 供电。隔离(远端)分流传感器连接至 71M6xx3 的差分输入。71M6543 也可以与电流变压器配合使用,此时不需要 71M6xx3 隔离传感器。利用 71M6xx3 配套隔离器,系统可提供:

- 数字隔离通信接口
- 模拟前端(AFE), 具有 22 位二阶 Σ-Δ ADC
- 精密电压基准(VREF)
- 温度传感器(用于数字温度补偿)
- 全差分分流传感器输入
- 前置放大器,用于优化分流传感器性能
- 隔离电源电路,从71M6543发送的脉冲获取直流电源

典型应用中,71M6543 的 32 位计算引擎(CE)顺序处理从模拟输入引脚采集的电压信号,计算有功能量 (Wh)和无功能量(VARh),以及四象限表计的 A^2h 和 V^2h 。然后 MPU 存取这些测量值,进一步处理并通过 MPU 的外围器件输出。

除了高级测量功能外,实时时钟(RTC)功能允许 71M6543 分时计价(TOU),用于多费率电表以及防时标窃电或其它窃电事件。在所有工作模式下,包括 MPU 暂停时,RTC 都将自动进行温度补偿,并在断电期间利用备份电池连续进行补偿。

测量信息可以显示在工作在低温环境的 3.3V。MPU 可以利用集成电荷泵和温度传感器增强 3.3 V LCD 在低温下的性能。片上电荷泵也可驱动 5 V LCD。灵活的 LCD 段显示方式便于整合现有的定制 LCD。通过软件调节 LCD 段和 DIO 引脚,以满足各种不同需求。

除了带有温度微调的超高精度电压基准外,片上数字温度补偿机制还包括温度传感器和相关控制,用于修正温度对测量值和 RTC 精度的影响,以满足 ANSI 和 IEC 标准的要求。与温度相关的外部元件,例如:晶振、电流变压器(CT)、分流器及其相应的信号调理电路,定义其温度特性并编程修正因子,使得电表在整个工业温度范围内达到高精度计量的要求。

可利用两个内部 UART 其中之一支持红外 LED,提供内部驱动和检测配置,亦可作为标准 UART 使用。可选择 38kHz 调制输出。这种灵活性方便了利用 IR 接口实现 AMR 电表的设计,图 1 所示为 IC 方框图。

2.2 模拟前端(AFE)

AFE 作为数据采集系统,由 MPU 控制。为了支持低功耗分流传感器,71M6543 AFE 也可以配合隔离 71M6xx3 传感器工作。图 2 和图 3 所示为两种最常见的配置,也可以根据实际需求采用其它配置。直接连接至 71M6543 (即 IADC0-IADC1、VADC8、VADC9 和 VADC10)的传感器复用至单个二阶 Σ -Δ ADC 输入,由 71M6543 进行采样。71M6543 的 ADC 输出经 FIR 滤波后储存到 CE RAM 中,由 CE 进行后续处理。

采用 71M6xx3 器件隔离的分流传感器由 71M6xx3 中的二阶 Σ -Δ ADC 采样,信号样本通过低成本隔离脉冲变压器传输。

图 2 所示为配合分流传感器和 71M6xx3 隔离传感器使用的 71M6543。图 2 支持零相电流测量,在 IADC0-IADC1 输入连接本地分流器,器件还连接了三个远端(隔离)分流传感器。如图 2 所示,远端隔离分流传感器通过 71M6xx3 连接,该电流通道的采样不会切换到复用器,而是通过数字隔离接口直接传送给71M6543,并直接储存在 CE RAM。 *MUX_SELn[3:0]* I/O RAM 控制字段允许 MPU 将 AFE 配置成相应的多路复用器采样序列。关于 CE 代码和对应的 AFE 设置,请参考表 1 和表 2。

图 31 所示为对应于图 2 配置的电表接线。

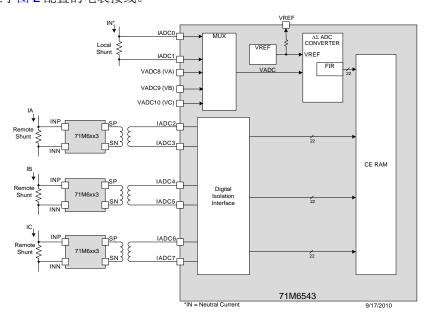


图 2. AFE 方框图(分流器:一个本地传感器、三个远端传感器)

71M6543 AFE 也可以直接连接到电流变压器(CT),如图 3 所示。在这种情况下,所有电压、电流均复用至71M6543 的单路二阶 Σ - Δ ADC,没有使用 71M6xx3 远端隔离传感器。可选择第四个 CT,通过 IADC0-IADC1 电流通道测量零相电流。

图 32 所示为对应于图 3 的接线配置。

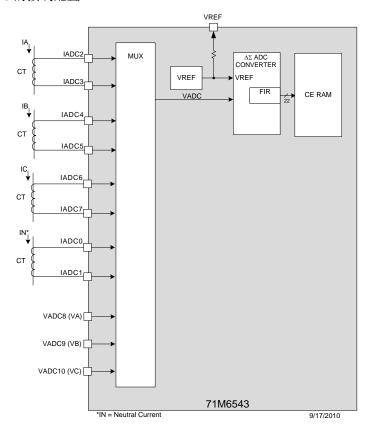


图 3. AFE 原理框图 (四个 CT)

2.2.1 信号输入引脚

71M6543 具有 11 路 ADC 输入。

IADC0 至 IADC7 用作电流传感器输入。这 8 路电流传感器输入可配置为 8 路单端输入,或配对构成 4 路差分输入。为获得最佳性能,建议将电流传感器输入配置为差分输入(即:IADC0-IADC1、IADC2-IADC3、IADC4-IADC5 和 IADC6-IADC7)。第 1 路差分输入(IADC0-IADC1)具有前置放大器,增益可选择 1 或 8,直接连接分流电阻传感器,还可使用电流变压器(CT)。剩下的三路差分对(即:IADC2-IADC3、IADC4-IADC5 和 IADC6-IADC7)可用于 CT 或连接远端 71M6xx3 隔离电流传感器,使用低成本脉冲变压器为分流电阻传感器提供隔离。

其余三路输入: VADC8 (VA)、VADC9 (VB)和 VADC10 (VC)为单端配置,在多相电表应用中检测每一相的电压。这三路单端输入以 V3P3A 引脚为参考。

所有 ADC 输入引脚均测量电压。使用分流电流传感器时,通过分流电阻传感器的压降测量电流。使用电流变压器(CT)时,通过连接在 CT 次级线圈的负载电阻的电压测量电流。同时,通过电阻分压器检测电网电压。VADC8 (VA)、VADC9 (VB)和 VBVADC10 (VC)引脚为单端,返回至 V3P3A 引脚。每种传感器的连接方法请参见图 27、图 28、图 29 和图 30。另请参考 71M6543 演示板原理图及类似电路的典型元器件参数材料清单。

引脚 IADC0-IADC1 可独立设置为差分或单端输入,由 $DIFF0_E$ (I/O RAM 0x210C[4])控制位决定。然而,对于大多数应用,IADC0-IADC1 配置为差分输入,需要相应的外部信号调整电路。

利用 I/O RAM 控制位 PRE_E (I/O RAM 0x2704[5])使能固定增益为 8 的前置放大器,可增强 IADC0-IADC1 引脚的性能。 PRE_E = 1 时,IADC0-IADC1 配置为 8 倍增益的前置放大器输入,放大器输出送至复用器。使用低灵敏度电流传感器时,例如锰铜分流器,8 倍放大器非常适合。 PRE_E 置位时,IADC0-IADC1 输入信号幅度峰值限制在 31.25mV。 PRE_E = 0 (增益 = 1)时,IADC0-IADC1 输入信号峰值限制在 250mV。

使用锰铜分流传感器的 71M6543 (图 2),通过置位 *DIFFO_E* 控制位将 IADC0-IADC1 引脚配置为差分模式,连接至本地分流器。同时,通过置位 *RMTx_E* 控制位(*I/O RAM 0x2709[5:3]*),将 IADC2-IADC3、IADC4-IADC5 和 IADC6-IADC7 引脚重新配置为数字远端传感器接口,与 Teridian 71M6xx3 隔离传感器通信。71M6xx3 通过隔离脉冲变压器,利用双向数字流与 71M6543 通信。71M6543 还通过隔离变压器为71M6xx3 供电。本章末尾对这一类型的接口进行了更深入的说明,参见第 2.2.8 节 71M6xx3 隔离传感器接口。

如图 3 所示,为了使用电流变压器(CT),将 RMTx_E 控制位复位,从而使 IADC2-IADC3、IADC4-IADC5 和 IADC6-IADC7 配置为本地模拟输入。ADC0-IADC1 引脚不能配置为远端传感器接口。

2.2.2 输入复用器

使用本地传感器工作时,输入复用器按照 11 个 *MUXn_SEL[3:0]*控制字段确定的采用顺序,将模拟输入信号依次作用到 ADC 输入(见图 3)。一个完整的采用过程称为复用帧。电流传感器输入配置为单端模式时,71M6543 的复用器可选择多达 11 路输入信号;电流传感器输入配置为差分模式时(推荐采用这种配置,以获得最佳性能),每个复用帧的输入信号为 7 个(即: IADC0-IADC1、IADC2-IADC3、IADC4-IADC5、IADC6-IADC7、VADC8、VADC9和 VADC10)。复用帧时隙数量由 I/O RAM 控制字段 *MUX_DIV[3:0]* (I/O RAM 0x2100[7:4])控制(见图 4)。复用器总是从状态 0 开始,直到转换完成 *MUX_DIV[3:0]*决定的所有状态。

71M6543 需要针对特定电表配置编写的 CE 代码。此外,每个 CE 代码都需要特定的 AFE 和 MUX 设置才能正常工作。表 1 列出了与图 2 中 1 个本地传感器/3 个远端传感器配置相对应的 CE 代码和设置;表 2 列出了与图 3 CT 配置相对应的 CE 代码和设置。

表 1. CE 代码和设置(1 个本地/3 个远端传感器)

		· XE(-) 1 1 2 2 2	,,		
I/O RAM 助记符	I/O RAM 位置	I/O RAM 设置	注释		
FIR_LEN[1:0]	210C[2:1]	1	288 周期		
ADC_DIV	2200[5]	0	快速		
PLL_FAST	2200[4]	1	19.66MHz		
MUX_DIV[3:0]	2100[7:4]	6	见注 1		
MUX0_SEL[3:0]	2105[3:0]	0	时隙 0 为 IADC 0 -IADC1 (IN)		
MUX1_SEL[3:0]	2105[7:4]	1	未使用(见注 2)		
MUX2_SEL[3:0]	2104[3:0]	1	未使用(见注 2)		
MUX3_SEL[3:0]	2104[7:4]	8	时隙 3 为 VADC 8 (VA)		
MUX4_SEL[3:0]	2103[3:0]	9	时隙 4 为 VADC 9 (VB)		
MUX5_SEL[3:0]	2103[7:4]	Α	时隙 5 为 VADC 10 (VC)		
MUX6_SEL[3:0]	2102[3:0]	0			
MUX7_SEL[3:0]	2102[7:4]	0			
MUX8_SEL[3:0]	2101[3:0]	0	时隙未使能		
MUX9_SEL[3:0]	2101[7:4]	0			
MUX10_SEL[3:0]	2100[3:0]	0			
RMT2_E	2709[3]	1	使能远端 IADC2-IADC3 (IA)		
RMT4_E	2709[4]	1	使能远端 IADC4-IADC5 (IB)		
RMT6_E	2709[5]	1	使能远端 IADC6-IADC7 (IC)		
DIFF0_E	210C[4]	1	差分 IADC0-IADC1 (IN)		
DIFF2_E	210C[5]	0	见注 3		
DIFF4_E	210C[6]	0	见注 3		
DIFF6_E	210C[7]	0	见注 3		
PRE_E	2704[5]	1	IADC0-IADC1 增益 = 8		
EQU[2:0]	2106[7:5]	5	IA*VA + IB*VB + IC*VC		
220[2:0]	2.00[1.0]		ラ 71M6603 配合使用)		
CE 代码		•	5 7 1M6003 配音 反角) 5 71M6103 配合使用)		
(见注 4)					
(元往4)	ce43b016113 (与 71M6113 配合使用)				
4- /\	ce43b016203 (与 71M6203 配合使用) 5				
公式	1 个本地分流器和 3 个远端分流器				
电流传感器类型					
对应电路图	图 2、图 4 和图 31				
→					

注:

- 1. 该表中写入其它数值时, $MUX_DIV[3:0]$ 应该置 0; 然后,在写 $MUXn_SEL[3:0]$ 字段之前置入需要的数值。
- 2. 每个不用的时隙必须分配有效数值(0至 A), 但不进行 ADC 操作。
- 3. 该通道为远端检测(71M6xx3),与 DIFFx_E 不相关。
- 4. 必须使用 71M6xx3 器件特定的 CE 代码。

Teridian 定期更新 CE 代码。关于最新的 CE 代码和相关设置,请联系当地的 Teridian 代表处获取最新的 CE 代码和相关设置。

表 2. CE 代码和设置(CT 传感器)

I/O RAM 助记符	I/O RAM 位置	I/O RAM 设置 (Hex)	注释	
FIR_LEN[1:0]	210C[2:1]	1	288 周期	
ADC_DIV	2200[5]	0	快速	
PLL_FAST	2200[4]	1	19.66MHz	
MUX_DIV[3:0]	2100[7:4]	7	见注 1	
MUX0_SEL[3:0]	2105[3:0]	2	时隙 0 为 IADC 2 -IADC3	
			(IA)	
MUX1_SEL[3:0]	2105[7:4]	8	时隙 1 为 VADC8	
			(VA)	
MUX2_SEL[3:0]	2104[3:0]	4	时隙 2 为 IADC4-IADC5	
			(IB)	
MUX3_SEL[3:0]	2104[7:4]	9	时隙 3 为 VADC 9	
			(VB)	
MUX4_SEL[3:0]	2103[3:0]	6	时隙 4 为 IADC 6 -IADC7	
		-	(IC)	
MUX5_SEL[3:0]	2103[7:4]	Α	时隙 5 为 VADC 10	
			(VC)	
MUX6_SEL[3:0]	2102[3:0]	0	时隙 6 为 IADC0-IADC1	
			(IN – 见注 2)	
MUX7_SEL[3:0]	2102[7:4]	0		
MUX8_SEL[3:0]	2101[3:0]	0	时隙未使能	
MUX9_SEL[3:0]	2101[7:4]	0	74 120 14 12 13	
MUX10_SEL[3:0]	2100[3:0]	0	Lid II - Partition Co. 11 Dec	
RMT2_E	2709[3]	0	本地传感器 IADC2-IADC3	
RMT4_E	2709[4]	0	本地传感器 IADC4-IADC5	
RMT6_E	2709[5]	0	本地传感器 IADC6-IADC7	
DIFF0_E	210C[4]	1	差分 IADC0-IADC1	
DIFF2_E	210C[5]	1	差分 IADC2-IADC3	
DIFF4_E	210C[6]	1	差分 IADC4-IADC5	
DIFF6_E	210C[7]	1	差分 IADC6-IADC7	
PRE_E	2704[5]	0	IADC0-IADC1 增益 = 1	
EQU[2:0]	2106[7:5]	5	IA*VA + IB*VB + IC*VC	
CE 代码			ce43a02	
公式	5			
电流传感器类型	4 个电流传感器(CT)			
对应电路图	图 3、图 4 和图 32			

注:

- 1. 该表中写入其它数值时, $MUX_DIV[3:0]$ 应该置 0; 然后,在写 $MUXn_SEL[3:0]$ 字段之前置入需要的数值。
- 2. IN 为可选择的零相电流。

Teridian 定期更新 CE 代码。关于最新的 CE 代码和相关设置,请联系当地的 Teridian 代表处获取最新的 CE 代码和相关设置。



如果使用表 1 和表 2 列出的 I/O RAM 助记符设置与对应的 CE 代码不匹配,则会产生负面影响,MPU 不会选中。请联系当地的 TERIDIAN 代表处获取与之对应的正确 CE 代码和 AFE/MUX 设置。

图 2 所示给出了使用锰铜电流传感器和 71M6xx3 隔离传感器、带有零相检测功能的多相配置,IADC0-IADC1 输入必须配置为差分输入,连接到本地分流器(详细的分流器连接方法如图 30 所示)。连接至IADC0-IADC1 输入的本地分流器用于检测零相电流。电压传感器(VADC8、VADC9 和 VADC10)也直接连接到 71M6543 (详细的连接方法如图 27 所示),通过多路复用器传输,如图 2 所示。同时,IADC2-IADC3、IADC4-IADC5 和 IADC6-IADC7 电流输入配置为远端传感器数字接口,相应的采样不通过复用器。这种配置的复用器时序如图 4 所示。

对于使用电流变压器(CT)传感器、可选择零相检测功能的多相配置,如图 3 所示,所有四路电流传感器输入必须配置为差分输入,连接到对应的 CT (详细的差分 CT 连接方法如图 29 所示)。IADC0-IADC1 电流传感器输入可选择用于检测零相电流,用于防窃电设计。电压传感器(VADC8、VADC9 和 VADC10)直接连接至 71M6543 (详细的电压传感器连接方法如图 27 所示)。这种配置下不使用 71M6xx3 隔离传感器,所有传感器通过复用器连接,如图 3 所示。这种配置的复用器时序如图 5 所示。

图 4 所示的复用器时序与图 2 配置相对应。帧持续时间为 13 个 CK32 周期(其中 CK32 = 32,768 Hz),因此,采样率为 32,768 Hz / 13 = 2,520.6 Hz。注意,图 4 仅显示了通过 71M6543 复用器的电流,未显示直接从远端传感器保存到 CE RAM 的电流(图 2),这些电流在复用帧的下半周期采样获得。图中两个未使用的转换时隙是支持 2.520.6 Hz 采样率所必需的。

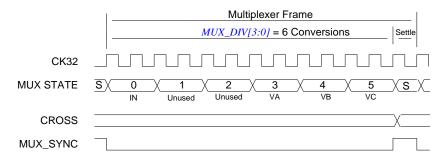


图 4. 复用帧状态(MUX_DIV[3:0] = 6)

图 5 所示复用器时序与图 3 的 CT 配置相对应。由于所有电流传感器本地连接至 71M6543,电流均通过复用器传送,如图 3 所示。对于复用器时序,帧持续时间为 15 个 CK32 周期(其中 CK32 = 32,768 Hz),采用率为 32,768 Hz / 15 = 2,184.5 Hz。

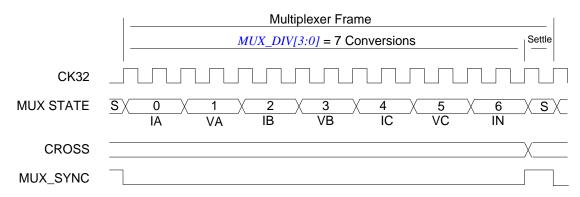


图 5. 复用帧状态(MUX_DIV/3:0] = 7)

复用器切换、FIR 启动以及选择 ADC 基准电压(使用内部 CROSS 信号,参见第 2.2.7 节电压基准)由内部 MUX_CTRL 电路控制。此外,MUX_CTRL 控制每次 CE 代码的执行。MUX_CTRL 由 PLL 模块的 32768 Hz 时钟 CK32 驱动。下面是 MUX_CTRL 电路管理寄存器:

- CHOP_E[1:0] (I/O RAM 0x2106[3:2])
- MUX_DIV[3:0] (I/O RAM 0x2100[7:4])
- FIR_LEN[1:0] (I/O RAM 0x210C[2:1])
- ADC DIV (I/O RAM 0x2200[5])

每个复用器状态的持续时间取决于 FIR 处理的 ADC 采样通道数量,由 $FIR_LEN[1:0]$ (I/O RAM 0x210C[2:1] 控制字段决定。每个复用器状态从 32kHz 时钟 CK32 的上升沿开始。

建议在更改 ADC 配置时将 $MUX_DIV[3:0]$ (I/O RAM 0x2200[2:0])设置为 0,虽然不是必须要求,这样做有助于将 ADC 输入之间可能产生瞬间短路而引起的系统瞬变降至最小,特别是在更改 $DIFFn_E$ 控制位(I/O RAM 0x210C[5:4])的情况下。设置该配置位后, $MUX_DIV[3:0]$ 应设置在所要求的数值。

CK32 周期中每个时隙的持续时间取决于 FIR_LEN[1:0]、ADC_DIV 和 PLL_FAST。

Time_Slot_Duration = $(3-2*PLL_FAST)*(FIR_LEN[1:0]+1)*(ADC_DIV+1)$

CK32 周期中复用帧的持续时间为:

MUX_Frame_Duration = 3-2*PLL_FAST + Time_Slot_Duration * MUX_DIV[3:0]

CK FIR 周期中复用帧的持续时间为:

MUX frame duration (CK_FIR cycles) =

[3-2*PLL_FAST + Time_Slot_Duration * MUX_DIV] * (48+PLL_FAST*102)

可通过 $MUXx_SEL$ 控制字段(I/O RAM 0x2100 至 0x2105)编程 ADC 转换时序。如上所述,71M6543 有 11 个 ADC 时隙,由 $MUX_DIV[3:0]$ (I/O RAM 0x2100[7:4])设置。表达式 $MUXx_SEL[3:0] = x$ 中,"n"指复用帧时隙数量,x 代表对应 ADC 输入编号或序号(即 IADC0 至 VADC10,或简单的 0 至 10 十进制数)。由此,在71M6543 器件中共有 11 个有效的 ADC 序号。例如,如果 $MUX0_SEL[3:0] = 0$,那么 IADC0,对应于IADC0-IADC1 输入(配置为差分输入)的采样,定位在复用帧的时隙 0。关于相应的 $MUXx_SEL[3:0]$ 设置及适合的电表配置和 CE 代码,请参见表 1 和表 2。

注意,启用远端传感器接口时,远端传感器电流的采样不通过 71M6543 复用器,在复用帧后半周期采样远端电流传感器。在复用帧的最后分配给 VA、VB、VC 电压三个时隙, VA、VB、VC 根据这一时隙安排对相应的远端传感器电流进行采样,遵循严格的相位电压、延时补偿关系,确保高精度指标(参见第 19 页 2.2.3 节延时补偿)。

使用远端传感器时,有必要引入不使用的时隙,以满足 MUX_DIV[3:0] (I/O RAM 0x2100[7:4])字段设置规定的时隙数量(见图 4 和图 5)。这些未使用("空操作")时隙的 MUXn_SEL[3:0]控制字段必须写入一个有效的ADC 序号(即十进制 0 至 10)。按照这种方式,未使用的 ADC 序号将作为复用帧中的"空操作"占位符,产生正确的复用帧时序持续时间,并满足所要求的采样率。CE 程序将忽略 CE RAM 中储存的对应于"控操作"ADC 序号的采样结果。同时,数字隔离接口负责自动将远端接口电流传感器的采样储存到相应的CE RAM 中。



CE 代码中的延迟补偿和其它功能要求 *MUX_DIV[3:0]、MUXx_SEL[3:0]、RMT_E、FIR_LEN[1:0]、ADC_DIV* 和 *PLL_FAST* 的设置对于给定的 CE 代码是固定的。关于 **71M6543** 的合理设置,请参见表 **1** 和表 **2**。

表 3 汇总了用于配置复用器、信号引脚和 ADC 的 I/O RAM 寄存器。所有列出的寄存器在复位及从电池模式唤醒后清零,可进行读、写操作。

名称	位置	说明			
MUX0_SEL[3:0]	2105[3:0]	选择在时隙 0 期间转换 ADC 输入。			
MUX1_SEL[3:0]	2105[7:4]	选择在时隙 1 期间转换 ADC 输入。			
MUX2_SEL[3:0]	2104[3:0]	选择在时隙 2 期间转换 ADC 输入。			
MUX3_SEL[3:0]	2104[7:4]	选择在时隙 3 期间转换 ADC 输入。			
MUX4_SEL[3:0]	2103[3:0]	选择在时隙 4 期间转换 ADC 输入。			
MUX5_SEL[3:0]	2103[7:4]	选择在时隙 5 期间转换 ADC 输入。			
MUX6_SEL[3:0]	2102[3:0]	选择在时隙 6 期间转换 ADC 输入。			
MUX7_SEL[3:0]	2102[7:0]	选择在时隙 7 期间转换 ADC 输入。			
MUX8_SEL[3:0]	2101[3:0]	选择在时隙 8 期间转换 ADC 输入。			
MUX9_SEL[3:0]	2101[7:0]	选择在时隙 9 期间转换 ADC 输入。			
MUX10_SEL[3:0]	2100[3:0]	选择在时隙 10 期间转换 ADC 输入。			
ADC_DIV	2200[5]	控制 ADC 和 FIR 时钟速率。			
MUX_DIV[3:0]	2100[7:4]	每个复用帧中 ADC 时隙的数量(最大 = 11)。			
PLL_FAST	2200[4]	控制 PLL 和 MCK 速率。			
FIR_LEN[1:0]	210C[2:1]	决定 ADC 抽样 FIR 滤波器中的 ADC 周期数。			
DIFF0_E	210C[4]	使能模拟输入引脚 IADC0-IADC1 的差分配置。			
DIFF2_E	210C[5]	使能模拟输入引脚 IADC2-IADC3.的差分配置。			
DIFF4_E	210C[6]	使能模拟输入引脚 IADC4-IADC5 的差分配置。			
DIFF6_E	210C[7]	使能模拟输入引脚 IADC6-IADC7 的差分配置。			
RMT2_E	2709[3]	使能远程传感器接口,将引脚 IADC2-IADC3 转换为数字接口,与 71M6xx3 传感器通信。			
RMT4_E	2709[4]	使能远程传感器接口,将引脚 IADC4-IADC5 转换为数字接口,与 71M6xx3 传感器通信。			
RMT6_E 2709[5] 使能远程传感器接口,将引脚 IADC6-IADC7 转换为数字接口,与 71M6xx 器通信。					
PRE_E 2704[5] 使能 8x 前置放大器。					
关于这些 I/O RAM	位置的详细信	息,请参见从第 104 页开始的表 71。			

表 3. 复用器和 ADC 配置位

2.2.3 延时补偿

测量单相能量(即 Wh 和 VARh)时,必须对该相电压和电流同步采样。否则,会产生相位差 Φ ,进而引入误差。

$$\phi = \frac{t_{delay}}{T} \cdot 360^{\circ} = t_{delay} \cdot f \cdot 360^{\circ}$$

式中,f为输入信号的频率,T=1/f, t_{delay} 为电流和电压之间的采样延迟。

传统设计中,采样是通过控制每相的两个 A/D 转换器(一个用于电压,另一个用于电流)同时采样实现的。而 Teridian 的单转换器技术(Single-Converter Technology®)利用其 CE 的 32 位信号处理能力,实现了"固定延迟"全通滤波器。全通滤波器修正采用单路复用 A/D 转换器引起的电压和对应电流采样之间的转换时间差。

"固定延迟"全通滤波器提供 360°-θ 宽频带延迟,它与给定相的电压和电流之间的采样时间差精确匹配。该数字滤波器不影响信号幅值,但提供精确受控的相位响应。

推荐 ADC 复用序列首先采样电流,随后采样对应相的电压,由此,电压比电流延迟一个相位角 Φ 。CE 内执行的延迟补偿首先将电流采样延迟一个完整的采样间隔(即 360°),然后使电压采样通过全通滤波器,由此将电压采样延迟 360° - θ ,造成电流与对应电压之间的相位误差为 θ - Φ ,从而将电压样本与对应的电流样本对齐。剩余相位误差可忽略不计,100Hz 时,误差通常小于±1.5 毫度,所以不会引起能量测量误差。

使用远程传感器时,CE 执行与上述相同的延迟补偿,将每个电压采样与对应的电流采样对齐。即使远程电流采样不通过 71M6543 复用器,如果按照表 1 对 *MUXn_SEL[3:0]*时隙分配字段编程,它与对应电压的定时关系也是固定且精确可知的。注,这些时隙分配使得 VA、VB 和 VC 分别占用复用时隙 3、4 和 5 (见图4)。

2.2.4 ADC前置放大器

ADC 前置放大器为低噪声差分放大器,固定增益 8 仅可用于 IADC0-IADC1 传感器输入引脚。通过置位 $PRE_E=1$ (I/O RAM 0x2704[5])使能 8 倍增益。禁用时,前置放大器的电源电流< 10nA,增益为单位增益。正确设置 PRE_E 和 $DIFFO_E$ (I/O RAM 0x210C[4])位,无论是否选择差分模式,均可使用前置放大器。为获得最佳性能,建议使用差分模式。为节约功率,根据 ADC_DIV 控制位(I/O RAM 0x2200[5])调节前置放大器和 ADC 的偏置电流。

2.2.5 A/D转换器(ADC)

利用 2 阶 Σ -Δ A/D 转换器量化输入电压和电流。ADC 分辨率(包括符号位)为 21 位($FIR_LEN[1:0] = 01$, I/O RAM 0x210C[2:1])或 22 位($FIR_LEN[1:0] = 10$)。ADC 时钟由 CKADC 驱动。

由 MUX_CTRL 内部电路控制每次 ADC 转换的启动。ADC 转换结束时,FIR 滤波器输出数据储存至 CE RAM,地址由复用器选项决定。

2.2.6 FIR滤波器

有限冲击响应滤波器是 ADC 的一部分,针对复用器进行优化,使 ADC 输出达到所要求的分辨率。每次 ADC 转换结束时,输出数据储存至固定的 CE RAM 地址,由存储在 *MUXn_SEL[3:0]的*复用器选项决定, FIR 数据经过左移 9 位后储存。

2.2.7 电压基准

带隙基准为 ADC 提供基准电压,基准幅值为斩波稳定,可由 MPU 利用 I/O RAM 控制字段 CHOP_E[1:0] (I/O RAM 0x2106[3:2])使能或禁用斩波电路。CHOP_E[1:0]字段中的两位使能 MPU,将斩波电路置于标准模式或反相模式,或者自动切换模式(推荐)。斩波电路在复用周期之间切换时,VREF 的直流失调被自动调整为零,因此,斩波电路必须配置成其中一种自动切换模式。

电压基准(VREF)的后级放大器通常存在长期漂移电压,通过斩波电路可以自动消除失调电压的影响,提供稳定的 VREF。71M6543 和 71M6xx3 均具有斩波电路,用于各自的 VREF 电压基准。

斩波放大器的典型拓扑如图 6 所示。CROSS 信号为内部信号,不能通过引脚或寄存器进行直接操作。

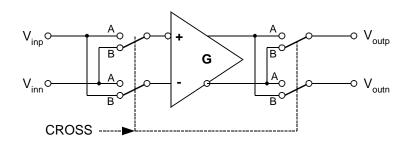


图 6. 斩波放大器通用拓扑

假设在放大器正极输入上有一个偏移电压 Voff。由 CROSS (内部信号)控制所有开关处于 A 位置时,输出电压为:

Voutp - Voutn = G (Vinp + Voff - Vinn) = G (Vinp - Vinn) + G Voff

通过施加反相 CROSS 信号将所有开关处于 B 位置时,输出电压为:

Voutn - Voutp = G (Vinn - Vinp + Voff) = G (Vinn - Vinp) + G Voff, or Voutp - Voutn = G (Vinp - Vinn) - G Voff

因此,CROSS 切换时,例如每个复用周期之后,输出偏移表现为正、负交替,从而消除漂移,不受极性或幅值影响。

CROSS 为高电平时,放大器输入连接反转。维持放大器增益的总体极性,将输入失调电压反相。通过交替反转连接,对放大器失调取平均,结果为零。这样就消除了电压基准中常见的长期失调。*CHOP_E[1:0] (I/O RAM 0x2106[3:2])*控制字段使能 CROSS 功能。在复用序列的最后一个转换状态之后的第一个 CK32 上升沿,复用器在开始新帧之前额外等待一个 CK32 周期。该周期开始时,根据 *CHOP_E[1:0]*字段更新 CROSS 数值。额外的 CK32 周期使斩波 VREF 有时间达到稳定。在此期间,MUXSYNC 保持为高电平。MUXSYNC的前沿启动一次 CE 程序的运行。

 $CHOP_E[1:0]$ 有四个状态:同相、反相和两个自动切换状态。同相状态下, $CHOP_E[1:0]$ = 01,CROSS 保持为低电平;反相状态下, $CHOP_E[1:0]$ = 10,CROSS 保持为高电平。两种自动切换状态通过设置 CHOP_E=11 或 CHOP_E=00 配置。

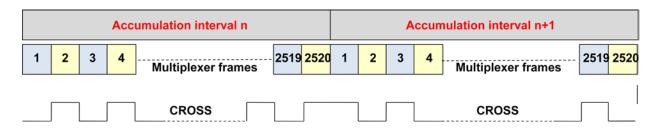


图 7. CROSS 信号, $CHOP_E = 00$

图 7 所示为 $CHOP_E[1:0] = 00$ 时两个累积间隔的 CROSS 信号。第一个间隔末尾,CROSS 为高电平;第二个间隔末尾,CROSS 为低电平。 $CHOP_E[1:0] = 00$ 时,不需要 MPU 控制斩波器。

在第二个自动切换状态, CHOP E[1:0] = 11, CROSS 在累积间隔的最后一个复用周期结束时不切换。

2.2.8 71M6xx3 隔离传感器接口

2.2.8.1 概述

非隔离传感器,例如电阻分流器,可通过 71M6xx3 和脉冲变压 (图 31 所示为该传感器接口的顶层方框图)的组合连接至 71M6543。71M6xx3 通过脉冲变压器直接从 71M6543 取电,无需专用的供电电路。71M6xx3 建立与 71M6543 的双向通信,通过串行数据流提供电流采样和辅助信息(例如:传感器温度)。

71M6543 支持多达三个 **71M6xx3** 隔离传感器。使能远端传感器接口时,两个模拟电流输入引脚重新配置为数字远端传感器接口。例如,控制位 $RMT2_E = 1$ 时,IADC2-IADC3 模拟引脚重新配置为连接至远端的数字接口引脚。

每个 71M6xx3 远端传感器由以下模块组成:

- 电源,从 71M6543 接收的脉冲产生电源
- 双向数字通信接口
- 分流信号前置放大器
- 22 位 2 阶 Σ-Δ ADC 转换器,带有高精度带隙基准(斩波放大器)
- 温度传感器(用于数字补偿 VREF)
- 熔丝器件,包含部件相关信息

在常规的复用周期内,71M6543 利用 $MUX_DIV[3:0]$ (I/O RAM 0x2100[7:4])决定使能哪个通道。同时,对远端传感器的调制器输出进行采样。每个转换结果在 CE 操作时隙写入 CE RAM。

2.2.8.2 71M6543 和 71M6xx3 隔离传感器之间的通信

71M6xx3 的 ADC 定时时钟来自 71M6543 产生的脉冲信号。电源脉冲的产生,以及 71M6543 和 71M6xx3 远端传感器之间的通信协议通过硬件自动完成,用户无需进行任何操作,本数据资料不作详细介绍。

2.2.8.3 71M6xx3 隔离传感器的控制

71M6543 可读、写每个 71M6xx3 远端传感器的特定字节信息。

读取数据由 RCMD[4:0]和 TMUXRn[2:0]组合选择。为执行对 71M6xx3 器件的读操作,MPU 首先写 TMUXRn[2:0]字段(其中 n = 2、4、6,分别位于 I/O RAM 0x270A[2:0]、0x270A[6:4]和 0x2709[2:0])。接着,MPU 根据所要求的命令和相选择写入 RCMD[4:0] (SFR 0xFC[4:0])。RCMD[4:2]位清零时,操作完成,请求发送的数据位于 $RMT_RD[15:0]$ (I/O RAM 0x2602[7:0]为 MSB,0x2603[7:0]为 LSB)。操作期间还更新读取奇偶校验位 $PERR_RD$ (SFR 0xFC[6])。如果 MPU 在完成上次读操作之前写入 RCMD[4:0],则忽略命令。因此,MPU 在继续发出下一条读命令之前必须等待 RCMD[4:2] = 0。

如果正在运行 CE ($CE_E=1$),MPU 必须在 CE_BUSY 上升沿之后立即写入 RCMD[4:0] 。RCMD[4:0]必须在下一个 MUX_SYNC 上升沿之前写入。否则,会造成读取数据不正确。

RCMD[4:0]字段分为两个子域: COMMAND=RCMD[4:2]和 PHASE=RCMD[1:0],如表 4 所示。

	命令	相选择器		相关的 TMUXRn
RCI	MD[4:2]	RCMD[1:0]		控制字段
000	无效	00	无效	
001	命令 1	01	IADC 2 -IADC3	TMUXR 2 [2:0]
010	命令2	10	IADC 4 -IADC5	TMUXR 4 [2:0]
011	保留	11	IADC 6 -IADC7	TMUXR 6 [2:0]
100	保留			
101	无效			
110	保留			
111	保留			

表 4. RCMD[4:0] 位

注:

- 1. 只有两个 *RCMD[4:2]* (*SFR 0xFC[4:2]*) 码与常规工作有关,为 *RCMD[4:2]* = 001 和 010。000 和 101 吗无效,如果使用,将被忽略。 其余编码为保留,不得使用。
- 2. 对于 *RCMD[1:0]*控制字段,编码 01、10 和 11 有效,00 无效,不得使用。
- 3. 与每个 *TMUXRn[2:0]*字段相关联的相(A、B 或 C)由 IADCn 输入引脚的 连接方式及电表设计决定。

表 5 所示为所允许的 RCMD[4:2]和 TMUXRn[2:0]数值组合、71M6xx3 远端传感器返回的对应数据类型和格式,并显示了数据如何储存至 $RMT_RD[15:8]$ 和 $RMT_RD[7:0]$ 。MPU 通过设置 RCMD[1:0]字段中的有效编码,选择读取三相电中的一相,如表 4 所示。

表 5. 远程接口读命令

RCMD[4:2]	TMUXRn[2:0]	读操作	<i>RMT_RD</i> [15:8]	RMT_RD [7:0]
001 00X (;		TRIMT[7:0] (熔丝寄存器,适用于全部 71M6xx3)	TRIMT[7]=RMT_RD[8]	TRIMT[6:0]=RMT_RD[7:1]
001	001 11X <i>TRIMBGB[7:0]</i> 和 <i>TRIMBGD[7:0]</i> (71M6113 和 71M6203 附加熔丝 调节)		TRIMBGB[7:0]	TRIMBGD[7:0]
010 00X <i>STEMP[10:0]</i> (检测的 71M6xx3 温度		STEMP[10:0] (检测的 71M6xx3 温度)	STEMP[10:8]=RMT_RD[10:8] (RMT_RD[15:11] are sign extended)	STEMP[7:0]
010	010 01X VSENSE[7:0] (检测的 71M6xx3 供电电压)		全零	VSENSE[7:0]
010	10X	VERSION[7:0] (芯片版本)	VERSION[7:0]	全零

Notes:

- 1. *TRIMT[7:0]* 是所有 **71M6xx3** 器件的 VREF 调整值。注意, *TRIMT[7:0]* **8** 位数值由 *RMT_RD[8]* 和 *RMT_RD[7:1]*组成。*TRIMT[7:0]对应的*等式及温度系数,请参考 **71M6xxx** 数据资料。
- 2. *TRIMBGB[7:0]*和 *TRIMBGD[7:0]*是用于 **71M6113** (0.5%)和 **71M6203** (0.1%)的过温调整值。*TRIMBGB[7:0]*的 相关公式和 TRIMBGD[7:0]的对应温度系数,请参考 **71M6xxx** 的数据资料。
- 3. 参见第 56 页的 2.5.6 节 71M6xx3 温度传感器。
- 4. 参见第 57 页的 2.5.8 节 71M6xx3 VCC 监测器。

71M6543 获取每个隔离传感器 71M6xx3 的硬件和相关信息,MPU 根据 71M6xx3 隔离传感器的温度特性实现电能测量的温度补偿。详情参见 4.5 节计量温度补偿。

表 6 列出了用于控制外部 71M6xx3 隔离传感器的全部 I/O RAM 寄存器,详情参见 71M6xx3 数据资料。

表 6. 用于远端传感器的 I/O RAM 控制位

名称	地址	RST 默认值	WAKE 默认值	读/写	说明
RCMD[4:0]	SFR FC[4:0]	0	0	R/W	MPU 向 <i>RCMD</i> 写非零值时, 71M6543 向由 <i>RCMD[1:0]</i> 选中的相应远端传感器发出一条命令。 完成命令后, 71M6543 清除 <i>RCMD[4:2]</i> 。命令码本身位于 <i>RCMD[4:2]</i> 。
PERR_RD PERR_WR	SFR FC[6] SFR FC[5]	0	0	R/W	71M6543 将这些位置位,表示在远端传感器上检测到奇偶校验错误。这些位一旦置位,则被记忆,直到由 MPU 清除。
CHOPR[1:0]	2709[7:6]	00	00	R/W	用于远端传感器的 CHOP。 00 - 自动斩波,每个复用帧变化。 01 - 正 10 - 负 11 - 同 00
TMUXR2[2:0]	270A[2:0]	000	000	R/W	TMUX 位,用于控制远端传感器。
TMUXR4[2:0]	270A[6:4]	000	000	R/W	TMUX 位,用于控制远端传感器。
TMUXR6[2:0]	2709[2:0]	000	000	R/W	TMUX位,用于控制远端传感器。
RMT_RD[15:8] RMT_RD[7:0]	2602[7:0] 2603[7:0]	0	0	R	用于 71M6xx3 读操作的读缓冲器。
RFLY_DIS	210C[3]	0	0	R/W	控制 71M6543 驱动 71M6xx3 电源脉冲的方式。置 1,脉冲驱动为高或低电平;清 0,驱动至高电平,后接一个开路反激间隔。
RMT2_E	2709[3]	0	0	R/W	使能隔离远程传感器,重新将引脚 IADC2-IADC3 配置为平衡线对的数字远程接口。
RMT4_E	2709[4]	0	0	R/W	使能隔离远程传感器,重新将引脚 IADC4-IADC5 配置为平衡线对的数字远程接口。
RMT6_E	2709[5]	0	0	R/W	使能隔离远程传感器,重新将引脚 IADC6-IADC7 配置为平衡线对的数字远程接口。

关于这些 I/O RAM 地址的详细信息,请参见从第 104 页开始的表 71。

2.3 数字计算引擎(CE)

CE 是一个专用的 32 位数字信号处理器,用来执行电量计量所需的精确运算。CE 运算和处理包括:

- 每个电流采样值与其对应电压采样值相乘,以获得每次采样的电能(与固定的采样时间相乘)。
- 对四个通道的非同步采样所产生的延迟进行算法补偿(不受频率影响)。
- 90°相移(用于无功计算)。
- 脉冲发生器。
- 输入信号频率监测(用于频率和相位信息)。
- 输入信号幅值监测(用于电压跌落检测)。
- 根据校准参数对采样进行缩放处理。
- 根据温度补偿信息对采样进行缩放处理。

2.3.1 CE程序存储器

CE 程序存储在程序存储器(FLASH)。CE 和 MPU 对 FLASH 的公共访问由存储器公用电路控制。每个 CE 指令为 2 字节长度。为 CE 程序分配的闪存空间不得超过 4096 个 16 位字(8KB)。CE 程序在复用器状态 0 开始启动。执行到 HALT 指令时,程序结束。为确保 CE 的正确运行,程序必须在复用周期结束之前执行 完毕。

CE 程序必须在闪存地址以 1KB 为边界处开始。71M6543F/H 的 I/O RAM 控制字段 CE_LCTN[6/5:0] (I/O RAM 0x2109[6/5:0])和 71M6543G/GH 的 CE_LCTN[6:0] (I/O RAM 0x2109[6:0])定义哪个 1KB 边界为 CE 代码的起始地址。所以,第一条 CE 指令位于 71M6543F/H 的 1024*CE_LCTN[5:0]和 71M6543G/GH 的 1024*CE_LCTN[6:0]。

2.3.2 CE数据存储器

CE 和 MPU 共用数据存储器(RAM)。CE 和 MPU 对 XRAM 的公共访问由存储器公用电路控制。CE 最多可访问 3KB 数据 RAM (XRAM)中的全部 5KB,即从 RAM 地址 0x0000 至 0x0C00。

XRAM 可由 FIR 滤波器模块、RTM 电路、CE 和 MPU 访问。分别为 FIR 和 MPU 保留分配的时隙,以防止 CE 访问 XRAM 数据时发生总线冲突。

MPU 读、写 CE 和 MPU 之间共用的 XRAM 是两个处理器之间数据通信的主要途径。

CE 通过支持硬件实现计量运算、脉冲计数和累加。通过 I/O RAM 控制字段 *EQU*[2:0] (计量公式辅助字段, I/O RAM 0x2106[7:5])、DIO_PV位(I/O RAM 0x2457[6])、DIO_PW位 (辅助脉冲计数, I/O RAM 0x2457[7]) 和 SUM_SAMPS[12:0] (累积辅助, (I/O RAM 0x2107[4:0]和 0x2108[7:0])控制硬件。

使用标准 CE 代码时,每个能量输出的积分时间为 *SUM_SAMPS[12:0]*/2184.53 (*MUX_DIV[3:0]* = 7, *I/O RAM 0x2100[7:4]*。完成累积时,CE 硬件触发 XFER_BUSY 中断。

2.3.3 CE与MPU通信

CE 向 MPU 输出 6 种中断信号:CE_BUSY、XFER_BUSY、XPULSE、YPULSE、WPULSE 和 VPULSE。 这些信号在芯片内部已连接至 MPU 中断服务。CE_BUSY 表示 CE 正在处理数据,该信号每个复用帧出现一次。XFER_BUSY 表示 CE 正在更新 CE RAM 的输出区域,累积循环结束时产生中断。CE 执行 HALT 指令后,CE_BUSY 和 XFER_BUSY 自动清零。

XPULSE 和 YPULSE 也可配置成中断,监测电网电压跌落故障、过零和脉冲事件中断。此外,这些信号也可直接输出至 DIO 引脚,CE 提供直接输出。这些信号对应的中断为上升沿触发。

2.3.4 电表公式

71M6543 为 CE 提供辅助硬件,以支持不同的计量公式。辅助电路通过 I/O RAM 寄存器 EQU[2:0] (公式辅助,I/O RAM 0x2106[7:5])控制。利用计算引擎(CE)固件配置执行表 7 所列公式,完全满足计量需求。同时 EQU[2:0]也含有计量公式及计量相数信息。

EQU[2:0]*	说明	有功	力和无功计量公	推荐的复用器序列	
EQU[2.0]	[[[[2:0]]]]		Element 1	单元 0	1年任印及用 66月7月
2	2 单元,3W,3φ Δ	VA · IA	VB · IB	N/A	IA VA IB VB
3	2 单元,4W, 3φ Δ	VA(IA-IB)/2	VC ·IC	N/A	IA VA IB VB IC VC
4	2 单元,4W,3∳ "Y"型	VA(IA-IB)/2	VB(IC-IB)/2	N/A	IA VA IB VB IC VC
5	3 单元,4W,3∳ "Y"型	VA · IA	VB · IB	VC · IC	IA VA IB VB IC VC (ID)

表 7. 复用器输入选择

注:

2.3.5 实时监测器(RTM)

CE 含有一个实时监测器(RTM),可设置为在全速采样速率下监测四个可选的 XRAM。四个监测位置的数据在每次开始执行 CE 时串行输出至 TMUXOUT。RTM 可由 RTM_E (I/O RAM 0x2106[1])使能和禁用。可在 TMU2OUT 引脚获得 RTM 输出时钟,每个 RTM 字需要 35 个周期,含起始位标志,RTM 输出格式请参见图 8。不使用时,RTM 为低电平。

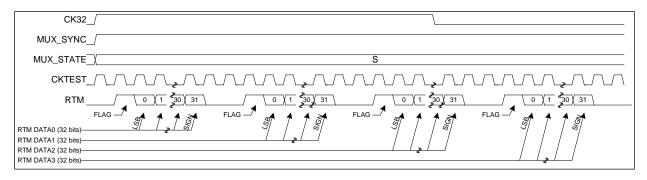


图 8. RTM 时序

2.3.6 脉冲发生器

71M6543 提供四路脉冲发生器: VPULSE、WPULSE、XPULSE 和 YPULSE, CE 代码通过 XPULSE 和 YPULSE 发生器输出 CE 状态指示,例如: 电压跌落状态探测,输出到对应的 DIO 口。所有脉冲均可配置为 MPU 中断。

PLS_INV (I/O RAM 0x210C[0]) 控制位可以切换脉冲的极性。该位置 1 时,脉冲为高电平有效,而非常见的低电平有效。PLS INV 反转所有脉冲输出极性。

每个脉冲发生器的功能由特定 CE 代码决定,MPU 必须配置与 CE 代码要求一致的脉冲输出功能。例如,在标准 CE 代码中,XPULSE 用来产生过零信号,YPULSE 用来产生 SAG 信号。

^{*}当前 71M6543 的 CE 程序支持 EQU[2:0] = 5。关于支持公式 2、3 和 4 的 CE 代码,请联系当地的 Teridian 代表处。

过零脉冲常用于产生一个中断,使软件能够修正实时时钟,以及针对晶振老化进行调节,前提是电网频率足够精确和稳定。SAG 脉冲通常用在交流电源跌落时产生预警中断,MPU 即可在 V3P3SYS 电压下降之前将重要信息(比如电量)存入外部 EEPROM。

2.3.6.1 XPULSE和YPULSE

CE 产生的脉冲可输出至 XPULSE 和 YPULSE 脉冲输出引脚, SEGDIO6 和 SEGDIO7 引脚分别用于这些脉冲。一般而言, XPULSE 和 YPULSE 输出可在每个 CE 代码周期更新一次。

详细信息参见第 120 页 5.4 节 CE 接口说明。

2.3.6.2 VPULSE和WPULSE

参见图 9,每个 CE 代码周期,硬件将 WPULSE 和 VPULSE 输出符号位保存在一个 8 位 FIFO 中,并以规定的间隔输出。这样 CE 代码就需要在其执行完之前计算 VPULSE 和 WPULSE 输出,并依靠硬件将其分配至复用帧。如图 9 所示,FIFO 在每个复用帧开始时复位。从图 9 还可以看出 I/O RAM 寄存器 PLS_INTERVAL[7:0] (I/O RAM 0x210B[7:0])控制到第一个脉冲更新之间的延迟,以及随后更新之间的间隔。 PLS_INTERVAL[7:0]寄存器的 LSB 等于 4 个 CK_FIR 周期(如果 $PLL_FAST = 1$ 且 $ADC_DIV = 0$,CK_FIR 通常为 4.9152MHz,但也可能是其它 CK_FIR 频率;参见表 71 中的 ADC_DIV 定义)。如果 $PLS_INTERVAL[7:0] = 0$,FIFO 禁用,脉冲输出由 CE 更新。

以 CK FIR 时钟周期为单位的 MUX 帧持续时间由下式决定:

如果 PLL FAST=1:

MUX frame duration in CK_FIR cycles = $[1 + (FIR_LEN+1) * (ADC_DIV+1) * (MUX_DIV)] * [150 / (ADC_DIV+1)]$ 如果 PLL_FAST =0:

MUX frame duration in CK_FIR cycles = [3 + 3*(FIR_LEN+1) * (ADC_DIV+1) * (MUX_DIV)] * [48 / (ADC_DIV+1)] 以 CK FIR 时钟周期为单位的 PLS INTERVAL[7:0]计算如下:

PLS_INTERVAL[7:0] = floor (Mux frame duration in CK_FIR cycles / CE pulse updates per Mux frame / 4)

由于 FIFO 在每个复用帧开始时复位,用户必须指定 $PLS_LINTERVAL[7:0]$,CE 在复用帧结束之前完成脉冲更新。例如,71M6543 CE 代码在每个复用周期更新 6 次输出,如果复用间隔为 1950 个 CK_FIR 时钟周期长,适用于该间隔的理想值为 1950/6/4 = 81.25。然而,如果 $PLS_LINTERVAL[7:0]$ = 82,如果第 6 次输出过迟,将丢失数据。这种情况下, $PLS_LINTERVAL[7:0]$ 的合理数值为 81 (即四舍五入结果)。

由于 *PLS_INTERVAL*[7:0] 的一个 LSB 等于 4 个 CK_FIR 时钟周期,以 CK_FIR 时钟周期为单位的脉冲时间间隔 T₁为:

$$T_1 = 4*PLS_INTERVAL[7:0]$$

如果使能 FIFO (即 $PLS_INTERVAL[7:0] \neq 0$,硬件也提供脉宽调整功能,由寄存器 $PLS_MAXWIDTH[7:0]$ (I/O $RAM\ 0x210A$) 实现。默认配置下,WPULSE 和 VPULSE 为负脉冲(即低电平脉冲,通过灌电流驱动 LED)。 $PLS_MAXWIDTH[7:0]$ 决定以 CK_FIR 时钟周期为单位的最大负脉冲宽度 T_{MAX} ,取决于脉冲间隔 T_{I} ,计算公式如下:

$$T_{MAX} = (2 * PLS_MAXWIDTH[7:0] + 1) * T_{I}$$

如果 PLS MAXWIDTH = 255 或 PLS INTERVAL = 0,则不执行脉宽检查,脉冲默认为 50%占空比。

脉冲极性可由控制位 PLS_INV (I/O RAM 0x210C[0]) 控制反转。置位 PLS_INV 时,脉冲为高电平有效。 PLS INV 默认值为零,低电平有效。

WPULSE 和 VPULSE 脉冲分别输出连接至 SEGDIO0/WPULSE 和 SEGDIO1/VPULSE (引脚 45 和 44)。脉冲也可以从 OPT_TX 引脚 53 输出(详情参见 OPT_TXE[1:0]、I/O RAM 0x2456[3:2])。

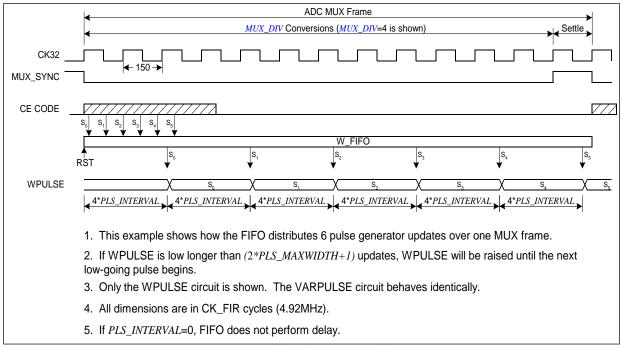


图 9. 脉冲发生器 FIFO 时序

2.3.7 CE功能综述

每个复用周期内 ADC 对每个通道进行一次采样,图 10 所示为 $MUX_DIV[3:0] = 7$ (I/O RAM 0x2100[7:4])时,一个复用周期内的采样时序。

一个累积周期内处理的采样数量由 I/O RAM 寄存器 $SUM_SAMPS[12:0]$ (I/O RAM 0x2107[4:0] 和 0x2108[7:0]) 控制。每个能量输出的积分时间为:

SUM_SAMPS[12:0] / 2184.53, 其中 2184.53 为采样率,单位为 Hz

例如,*SUM_SAMPS[12:0]* = 2184 时,每个累积周期建立 2184 个复用采样,持续时间为 2184/2184.53 = 0.9998 秒。完成累积周期后, XFER_BUSY 中断通知 MPU 有更新的累积数据。累积周期的标称长度 (1000 ms)与实际长度 999.8 ms 之间存在细小差异(0.025%),在 CE 代码中予以考虑,没有实质性的影响。

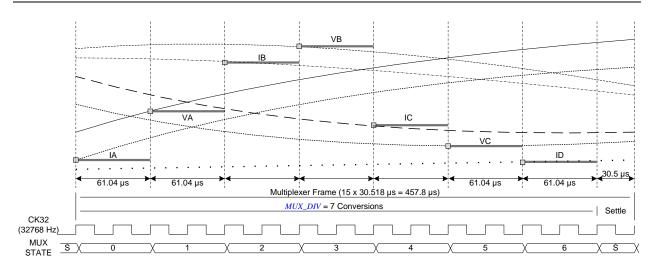


图 10. 复用周期内采样(帧)

每个复用周期结束时,都可以通过 CE_BUSY 中断通知 MPU 状态寄存器已更新,例如电压跌落数据和数字化的输入信号。

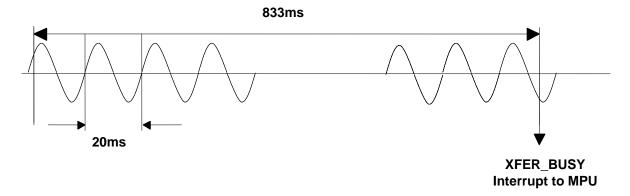


图 11. 累积间隔

图 11 所示为 $SUM_SAMPS[12:0]$ = 1819 (I/O RAM 0x2107[4:0]和 0x2108[7:0])个累积周期,每个采样周期 457.8µs 包括 1819 个样本,随后是 XFER_BUSY 中断。本例为 50Hz 信号采样情况,具体的电网频率与 $SUM_SAMPS[12:0]$ 无关。此外,并非必须从电网电压过零点开始采样,累积周期也无需是信号周期的整数 倍。

2.4 80515 MPU核

71M6543 集成了 80515 MPU (8 位、8051 兼容),大多数指令可以在一个时钟周期完成。因此 4.9MHz 主频相当于 4.9 MIPS 的处理能力。80515 架构消除了冗余总线状态,指令读取和执行并行执行。通常情况下,机器周期与存储周期对齐,因此,大多数单字节指令在单个机器周期(MPU 时钟周期)内完成,相对于相同时钟频率的 Intel® 8051 速率提升了 8 倍(MIPS)。

表 8 中 CKMPU 是 MCK 时钟(19.6608MHz)的分频输出,分频比通过 *MPU_DIV[2:0] (I/O RAM 0x2200[2:0])* MPU 时钟分频器设置。处理器时钟速率可以根据实际应用需求(表计计算、AMR 管理、存储器管理、LCD 驱动管理和 I/O 管理)通过 *MPU_DIV[2:0]*进行调整,如表 8 所示。

MPU_DIV [2:0]	CKMPU 频率
000	4.9152 MHz
001	2.4576 MHz
010	1.2288 MHz
011	614.4 kHz
100	
101	307.2 kHz
110	SULLZ KIIZ
111	

表 8. CKMPU 时钟频率

作为 Teridian 演示程序的一部分,我们提供根据内部 32 位计算引擎(CE)产生的结果进行测量和计量的 MPU 函数,帮助用户缩短设计周期。

2.4.1 存储器架构和寻址

80515 MPU 核心采用 Harvard 架构,代码和数据空间相隔离。80515 中的存储器管理与工业标准 8051 类似。有三个存储区域:程序存储器(闪存,MPU 和 CE 共用)、外部 RAM (数据 RAM, CE 和 MPU 共用,配置或 I/O RAM)、内部数据存储器(内部 RAM)。表 9 列出了存储器映射。

程序存储器

80515 可寻址高达 64KB 程序存储空间(0x0000 至 0xFFFF)。MPU 取指令或执行 MOVC 操作时,进行存储 器点操作。

从复位或低功耗状态唤醒后,MPU 从程序存储器的地址 0x0000 开始执行。程序存储器的低地址部分包括 复位和中断向量。中断向量以 8 字节间隔分布,从 0x0003 开始。

MPU外部数据存储器(XRAM)

不管是内部还是外部数据存储器,物理地址均在 **71M6543** 器件内部。本文提及的外部数据存储器只是相对于 **80515 MPU** 内核而言。

从地址 0x0000 开始的 5KB RAM 由 CE 和 MPU 共用。CE 通常使用前 1KB,为 MPU 保留 4KB。不同版本的 CE 代码,所占用的存储空间不同。准确数据请查阅具体版本代码的说明文档。



如果 MPU 覆盖 CE 的工作 RAM, CE 输出可能破坏。如果 CE 禁用,*MUX_DIV[3:0] ≠* 0(I/O *RAM0x2100[7:3]*)时,RAM 的前 0x40 字节仍然不可用,因为 71M6543 ADC 原始数据会更新到这些地址。设置 *MUX_DIV[3:0]* = 0 禁用 ADC 输出,防止 CE 覆盖 RAM 的前 0x40 字节。



此外,*MUXn_SEL[3:0]*值必须在*MUX_DIV[3:0]*写操作<u>之后</u>写入。

MPU 执行 MOVX @Ri,A 或 MOVX @DPTR,A 指令时,80515 写外部数据存储器。MPU 通过执行 MOVX A,@Ri 或 MOVX A,@DPTR 指令(PDATA, SFR 0xBF 为 MOVX A,@Ri 指令提供高 8 个字节)读外部数据存储器。

内部和外部存储器映射

表 9 中列出了各种存储器件的地址、类型、用途及大小。

表 9. 存储器映射

地址 (十六进制)	存储器技术	存储器类型	名称	典型用途	存储器大小 (字节)
0000-FFFF	闪存	非易失	程序存储器	MPU 程序和非易失数据	64 KB
0000-FFFF	內什	一一一一一	(生)丁竹月相前	CE 程序(在 1KB 边 界)	最大 3 KB.
0000-13FF	静态 RAM	易失	外部 RAM (XRAM)	CE和MPU共用	5 KB
2000-27FF	静态 RAM	易失	配置 RAM (I/O RAM)	硬件控制	2 KB
2800-287F	静态 RAM	非易失 (电池)	配置 RAM (I/O RAM)	电池备份缓存存储 器	128
0000-00FF	静态 RAM	易失	内部 RAM	部分 80515 核	256

MOVX寻址

有两种类型的指令,区别在于提供8位或16位外部数据RAM的间接地址。

第一种类型中,MOVX A,@Ri,当前寄存器组的 R0 或 R1 提供地址的 8 个低位。地址的 8 个高位由 *PDATA* SFR 指定。这种方法允许用户按页存取(256 页,每页 256 字节)外部数据 RAM 的整个范围。

第二种类型 MOVX 指令中,MOVX A,@DPTR,数据指针产生一个 16 位地址。这种形式在存取非常大的数据数组(高达 64 KB)时,由于无需额外指令来设置地址的 8 个高位,所以更快、更高效。

可以混合使用两种类型的 MOVX,为用户提供四个独立的数据指针,两个直接寻址,两个按页存取,可寻址整个 64KB 外部存储器范围。

双数据指针

双数据指针加快了数据块搬移。标准 DPTR 为 16 位寄存器,用于寻址外部存储器或外设。在 80515 核中,标准数据指针为 DPTR,第二个数据指针为 DPTRI。数据指针选择位位于 DPS 寄存器的 LSB (DPS[0], SFR Ox92)。DPS[0] = 0 时选择 DPTR,DPS[0] = 1 时选择 DPTRI。

用户通过改变 DPS 寄存器的 LSB 实现指针之间的切换。数据指针中的数值不受 DPS 寄存器的 LSB 影响。所有 DPTR 相关指令将使用当前的有效 DPTR 数值。



有些编译器不支持第二个数据指针。



DPTR1 对于数据搬迁非常有用,相对于从寄存器重新加载 DPTR,它可使此类操作更快。如果在中断服务程序中使用 DPTR1 时,必须保存并恢复 DPS、DPTR 和 DPTR1,增大了堆栈使用量,同时也延长了中断响应时间。



通过在 Keil 编译器项目设置中选择 Evatronics R80515 核,以及使用编译器指令"MODC2",可在特定的库中使能双数据指针。

PDATA 寄存器(SFR 0xBF)提供了另一种数据指针(USR2),定义了使用指令 MOVX A,@Ri 或 MOVX @Ri,A 读/写 XDATA 时的 16 位地址的高字节。

内部数据存储器映射和存取

80515 内部有 256 字节(0x00 至 0xFF)的数据存储器。内部数据存储器地址始终为单字节宽,表 10 列出了内部数据存储器映射。

特殊功能寄存器(SFR)占用高 128 个字节。内部数据存储器的SFR区域<u>只能通过直接寻址</u>使用,该区域的内部RAM必须使用间接寻址存取。低 128 字节包含工作寄存器和位寻址存储器。低 32 字节形成 4 组八寄存器(R0-R7)组。程序存储器状态字的两位(*PSW,SFR 0xD0*)选择使用哪组寄存器。接下来的 16 字节形成一块位寻址存储器空间,位地址为 0x00-0x7F。低 128 字节中的全部字节通过直接或间接寻址存取。

地址	止范围	直接寻址	间接寻址
0x80	0xFF	特殊功能寄存器(SFR)	RAM
0x30	0x7F	字节寻址区	区域
0x20	0x2F	位寻址区:	域
0x00	0x1F	工作寄存器组	R0R7

表 10. 内部数据存储器映射

2.4.2 特殊功能寄存器(SFR)

特殊功能寄存器的映射如表 11 所示。

SFR 存储器空间中只有少数几个地址被占用,其它无效。对未生效的地址进行读操作将返回未定义的数据,写操作无影响。71M6543 所特有的 SFR 以**粗体**表示。地址为 0x80、0x88、0x90 等寄存器位可寻址,其它均为字节寻址。

十六/二	位寻址				字节寻址				二/十六
进制	X000	X001	X010	X011	X100	X101	X110	X111	进制
F8	INTBITS	VSTAT			RCMD	SPI_CMD			FF
F0	В								F7
E8	<i>IFLAGS</i>								EF
E0	A								E7
D8	WDCON								DF
D0	PSW								D7
C8	T2CON								CF
C0	IRCON								C7
B8	IEN1	IP1	S0RELH	S1RELH				PDATA	BF
В0	P3		FLSHCTL				FL_BANK	PGADR	B7
A8	IEN0	IP0	SORELL.						AF
A0	P2	DIR2	DIR0						A7
98	SOCON	S0BUF	IEN2	SICON	S1BUF	S1RELL	EEDATA	EECTRL	9F
90	P1	DIR1	DPS		ERASE				97
88	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	CKCON		8F
80	P0	SP	DPL	DPH	DPL1	DPH1		PCON	87

表 11. 特殊功能寄存器映射

2.4.3 通用 80515 特殊功能寄存器

表 12 列出了通用 80515 SFR 的位置、说明及默认值。关于寄存器的更多说明,可参见表中所列页码。

表 12. 通用 80515 SFR—地址和复位值

名称	地址 (十六进制)	复位值 (十六进制)	说明	页码
P0	0x80	0xFF	端口 0	35
SP	0x81	0x07	堆栈指针	34
DPL	0x82	0x00	数据指针,低0	34
DPH	0x83	0x00	数据指针,高0	34
DPL1	0x84	0x00	数据指针,低 1	34
DPH1	0x85	0x00	数据指针,高 1	34
PCON	0x87	0x00	UART 速度控制	35, 38
TCON	0x88	0x00	定时器/计数器控制	41
TMOD	0x89	0x00	定时器/模式控制	39
TL0	0x8A	0x00	定时器 0, 低字节	39
TL1	0x8B	0x00	定时器 1, 低字节	39
ТН0	0x8C	0x00	定时器 0, 高字节	39
TH1	0x8D	0x00	定时器 1, 高字节	39
CKCON	0x8E	0x01	时钟控制(展宽=1)	35
P1	0x90	0xFF	端口 1	35
DPS	0x92	0x00	数据指针选择寄存器	31
S0CON	0x98	0x00	串口 0, 控制寄存器	37
S0BUF	0x99	0x00	串口 0,数据缓存器	36
IEN2	0x9A	0x00	中断使能寄存器 2	41
S1CON	0x9B	0x00	串口 1, 控制寄存器	38
S1BUF	0x9C	0x00	串口 1,数据缓存器	36
SIRELL	0x9D	0x00	串口 1, 重装载寄存器, 低字节	36
P2	0xA0	0xFF	端口2	35
IEN0	0xA8	0x00	中断使能寄存器 0	41
IP0	0xA9	0x00	中断优先级寄存器 0	43
SORELL.	0xAA	0xD9	串口 0, 重装载寄存器, 低字节	36
Р3	0xB0	0xFF	端口3	35
IEN1	0xB8	0x00	中断使能寄存器 1	41
IP1	0xB9	0x00	中断优先级寄存器 1	43
S0RELH	0xBA	0x03	串口 0, 重装载寄存器, 高字节	36
S1RELH	0xBB	0x03	串口 1, 重装载寄存器, 高字节	36
PDATA	0xBF	0x00	用于 MOVX@Ri 的地址高字节—也称为 USR2	31
IRCON	0xC0	0x00	中断请求控制寄存器	42
T2CON	0xC8	0x00	用于 INT2 和 INT3 的极性	
PSW	0xD0	0x00	程序状态字	
WDCON	0xD8	0x00	波特率控制寄存器(仅使用 WDCON[7]位)	
A	0xE0	0x00	累加器	
В	0xF0	0x00	B寄存器	34

累加器(ACC, A, SFR 0x E0):

ACC 为累加器寄存器,大多数指令使用累加器保存操作数。累加器相关指令的助记法将累加器记为 A,而非 ACC。

B寄存器(SFR 0xF0):

B 寄存器用于乘、除指令的过渡,亦可作为中间结果寄存器保存临时数据。

程序状态字(PSW, SFR 0xD0):

该寄存器包含各种标识和控制位,用于选择寄存器组(见表 13)。

表 13. PSW 位功能(SFR 0xD0)

PSW位	符号		功能					
7	CV	进位标识						
6	AC	用于 BCI	D 操作的辅助	进位标识。				
5	F0	用户可使	用通用 Flag	0。.				
		✓ 请勿料	等F0与CEST	ATUS 寄存器中的 F0 标	示识混淆。			
4	RS1	寄存器组	选择控制位。	RSI 和 RSO 的内容选择	释工作寄存器组 :			
			RS1/RS0	所选组	位置			
			00	第0组	0x00 – 0x07			
3	RS0		01	第1组	0x08 - 0x0F			
			10	第2组	0x10 - 0x17			
			11 第 3 组 0x18 – 0x1F					
2	OV	溢出标识。						
1	_	用户定义	用户定义标识。					
0	P	奇偶标识	,受硬件影响	向,指示累加器中 1 位的	的奇、偶数,即奇偶性。			

堆栈指针(SP, SFR 0x81):

堆栈指针为 1 字节寄存器,复位后初始化为 0x07。该寄存器在 PUSH 和 CALL 指令之前递增,即实际应用中堆栈从位置 0x08 开始。

数据指针:

数据指针(*DPTR* 和 *DPRT1*)为 2 字节宽。低字节部分分别为 *DPL* (*SFR 0x82*)和 *DPL1* (*SFR 0x84*)。高字节分别为 *DPH* (*SFR 0x83*)和 *DPH1* (*SFR 0x85*)。数据指针可作为两个寄存器(例如 MOV DPL, #data8)赋值。它们一般用于存取外部代码或数据空间(例如分别为 MOVC A,@A+DPTR 或 MOVX A,@DPTR)。

程序计数器:

程序计数器(PC)为 2 字节宽,复位后初始化为 0x0000。该寄存器在执行指令或操作程序存储器的数据时自动递增。

端口寄存器:

34

SEGDIO0 至 SEGDIO15 由特殊功能寄存器 PO、PI、P2 和 P3 控制,如表 14 所示。SEGDIO15 以上由 I/O RAM 中的 $LCD_SEGDIOn[$]控制。由每个 SFR Pn 寄存器的上半字节控制输入/输出方向,下半字节为 DIO 状态数据,可通过一次写操作配置指定 DIO 引脚的方向并设置其输出值,有利于实现位脉冲接口。向 DIO_DIR 位写 1,将 DIO 配置为输出;写 0 将其配置为输入。向 DIO 位写 1,使对应引脚为高电平(V3P3);写 0 使对应引脚为低电平(GND)。更多详情请参见第 2.5.10 节数字 I/O。

SFR 名称	SFR 地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
P0	80		DIO_D	IR[3:0]			DIO	[3:0]	
P1	90		DIO_D	IR[7:4]			DIO	[7:4]	
P2	A0	DIO_DIR[11:8]				DIO[11:8]		
P3	В0		DIO_DIF	R[15:12]			DIO[1	15:11]	

表 14. 端口寄存器(SEGDIO0-15)

芯片端口 *P0-P3* 为双向端口,对应 SEGDIO0-15 引脚。每个端口由锁存(SFR *P0* 至 *P3*)、输出驱动器和输入缓冲器组成,因此 MPU 可通过其中任意端口输出或读取数据。即使 DIO 引脚配置为输出,MPU 仍可读取该引脚状态,例如,在 CE 控制下通过 DIO 引脚对脉冲计数。



SEGDIO0-15 上电默认配置为输入,并且未使能。必须写 $PORT_E = 1$ (I/O RAM 0x270C[5])才能使能 SEGDIO0-15。默认 $PORT_E = 0$,防止 SEGDIO0-15 上电复位时可能发生的短时间输出瞬态脉冲。

时钟展宽(CKCON[2:0], SFR 0x8E)

CKCON[2:0] (SFR 0x8E)寄存器定义访问外设时 MOVX 指令的展宽存储周期。对于 **71M6543**,该寄存器的实际值确保 CE、MPU 和 SPI 之间对 XRAM 的访问。为了获得最佳性能,CKCON[2:0]的默认设置(001)应该更改为 000。

表 15 列出了展宽值在 0 至 7 范围设置时,外部存储器接口的信号变化。信号宽度以 MPU 时钟周期计数,下表中用**粗体**标记 *CKCON[2:0]* (001)字段复位后的状态,以扩展值 1 执行 MOVX 指令。

CKCON[2:0]	展宽值	读信号	景宽度	写信号	景宽度
CKCON[2:0]	灰见诅	memaddr	memrd	memaddr	memwr
000	0	1	1	2	1
001	1	2	2	3	1
010	2	3	3	4	2
011	3	4	4	5	3
100	4	5	5	6	4
101	5	6	6	7	5
110	6	7	7	8	6
111	7	8	8	9	7

表 15. 展宽存储周期宽度

2.4.4 指令集

支持通用 8051 微控制器的所有指令。71M654x 软件用户指南(SUG)提供了指令集及相关操作码的完整清单。

2.4.5 80515 低功耗模式

80515 核提供两种低功耗模式: 空闲模式和关断模式。通过设置 *PCON* SFR 寄存器(*SFR 0x87*)中的相应控制位使能低功耗模式。

空闲模式下 MPU 暂停工作,中断、定时器和串口继续保持有效。空闲模式下,中断事件可自动终止空闲模式。完成中断处理后,继续从设置空闲模式的指令之后执行程序。如需进入空闲模式,固件必须置位 PCON SFR 寄存器(SFR Ox87)中的 IDL 位(第 0 位)。

合理使用空闲模式,可明显降低 MPU 核的功耗。所节省的功耗量取决于空闲状态所占的时间百分比。由于会频繁发生某些中断,终止空闲状态,为了有效利用空闲模式节省功耗,可以在 MPU 后台处理主程序中放置一个软件循环,必要时将其置于空闲模式。该循环监测到某一位时触发空闲模式,退出循环。频繁发生的中断会终止空闲状态,但当控制程序返回到空闲循环程序时,又立即进入空闲模式。只有必要的中断才能控制退出空闲模式,并且相关的中断服务程序必须置位,终止空闲循环程序。

关断模式将暂停 MPU 和外设工作,通过硬件复位或外部中断事件进入关断模式。为了进入关断模式,固件必须置位 PCON SFR 寄存器(SFR 0x87)中的 PD 位(第 1 位)。

表 16. 80515 PCON SFR 寄存器(SFR 0x87)

第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位
SMOD	-	-	-	-	-	PD	IDL
3}-							

注:

SMOD 位与电源管理无关。

有关 SMOD 位的详细介绍,请参考 2.4.6 UART。

2.4.6 UART

71M6543 具有 UART (UART0),可设置为与各种 AMR 模块及其它外部器件通信。第二个 UART (UART1) 连接至光电接口,在第 57 页 2.5.9 部分详细说明 UART 和光电接口。

UART 为专用 2 线串口,可与外部主控处理器以高达 38,400 bps (MPU 时钟 = 1.2288MHz 时)的速率通信。 RX 和 TX UART0 工作如下:

- UARTO RX:该引脚用于串行数据输入,符合 RS-232 标准,字节以 LSB 在前输入。
- UARTO TX: 该引脚用于串行数据输出,字节以 LSB 在前输出。

71M6543 提供丰富的 UART 寄存器,用于控制和缓存数据。

SxBUF 寄存器既作为发送缓存器,又作为接收缓存器(SOBUF, SFR 0x99 用于 UARTO, SIBUF, SFR 0x9C 用于 UART1)。MPU 写入时, SxBUF 作为发送缓存器; MPU 读取时, 作为接收缓存器。向发送缓存器写数据,对应 UART 开始发送。可从接收缓存器读取接收到的数据,两个 UART 可同时发送、接收数据。

WDCON[7] (SFR 0xD8)选择使用定时器 1 还是内部波特率发生器。所有 UART 均可使能奇偶校验、奇/偶校验、2 个停止位/1 个停止位和 XON/XOFF 选项,通信波特率范围: 300~38400 bps。表 17 给出了波特率的计算方法,表 18 列出了可选的 UART 工作模式。

表 17. 波特率发生器

	使用定时器 1 (WDCON[7] = 0)	使用内部波特率发生器 (WDCON[7] = 1)
UART0	2 ^{smod} * f _{CKMPU} / (384 * (256- <i>TH1</i>))	2 ^{smod} * f _{CKMPU} /(64 * (2 ¹⁰ -SOREL))
UART1	N/A	f _{CKMPU} /(32 * (2 ¹⁰ -S1REL))

SOREL 和 SIREL 包含 10 位数值,数据分别来自定时器重新装载寄存器(SORELL、SORELH、SIRELL、SIRELH、U址分别为 SFR OxAA、SFR OxBA、FR Ox9D 和 SFR OxBB)。SMOD 为 SFR PCON 寄存器(SFR Ox87)中的 SMOD 位。THI(SFR Ox8D)为定时器 1 的高字节。

寿	18	ΠΔ	RT	模式

	UART 0	UART 1
模式 0	N/A	起始位,8个数据位、奇偶校验、停止位、可变波特率(内部波特率发生器)。
模式 1	起始位,8个数据位、停止位、可变波特率(内部波特率发生器或定时器1)。	起始位,8个数据位、停止位、可变波特率(内部波特率发生器)。
模式 2	起始位,8个数据位、奇偶校验、停止位、固定波特率,1/32或 1/64 f _{CKMPU} 。	N/A
模式3	起始位,8个数据位、奇偶校验、停止 位、可变波特率(内部波特率发生器或定 时器1)。	N/A



发送数据的奇偶校验可通过累加器的 P 标识获得。7 位带奇偶校验的串行模式:如 FLAG 通讯协议,可通过设置和读取 8 位输出数据中的第 7 位实现。7 位不带奇偶校验的串行模式,可将第 7 位固定置 1。通过设置和读取第 9 位,模拟带奇偶校验的 8 位串行模式,利用 SOCON (SFR Ox98)和 SICON (SFR Ox9B)寄存器中的控制位 TB80 (SOCON[3])和 TB81 (SICON[3])进行发送操作,SICON[2] 中的 RB81 用于接收操作。

接收数据时,所有支持的工作模式都对输入位流进行过采样。在每位持续时间的中间位置对其采样三次。该技术允许接收波特率偏离标称值 3.5%。

接收的第 9 位(对于 UART0 为模式 3,对于 UART1 为模式 A)可作为多处理器系统中处理器通信之间的握手信号。这种情况下,从机将 SM20 (SOCON[5]) (UART0)或 SM21 (SICON[5]) (UART1)置 1。主机输出从地址时,将第 9 位设为 1,使所有从机中的串口接收中断。从机将接收到的地址与本身地址进行比较。如果地址匹配,从机清除 SM20 或 SM21 位,并接收剩余消息,其它从处理器忽略此消息。寻址从处理器后,主处理器将第 9 位设为 0,输出剩余消息,产生从机串口接收中断。

UART0 和 UART1 的功能分别取决于串行端口控制寄存器 *SOCON、SICON* (如表 19 和表 20 所示)和 *PCON* 寄存器(如表 21 所示)。



虽然*TIO、RIO、TI1* 和*RI1* 位于SFR寻址字节中,但须<u>避免</u>位操作中清除这些字节。因为位操作由"读-修改-写"字节的硬件宏实现。如果在读操作之后、写操作之前发生中断,会错误地清除标识。

清除这些标识位的正确方式是写一个掩码,其中除被清除位为零外,其它位均为 1。标识位写 1 将被硬件忽略。

表 19. SOCON (UARTO)寄存器(SFR 0x98)

位	符号		功能				
S0CON[7]	SM0	SN	SMO和 SMI 位设置 UARTO 模式:				
			模式	说明	SM0	SM1]
			0	N/A	0	0	
SOCON[6]	SM1		1	8位 UART	0	1	
			2	9位 UART	1	0	
			3	9位 UART	1	1	
S0CON[5]	SM20	使	使能多机通信功能。				
SOCON[4]	REN0	如	如置位, 使能串行接收。由软件清除, 禁用接收。				
SOCON[3]	TB80			发送数据的第 9 个 多处理器通信等		置位或清除,	取决于要实现的

位	符号	功能
SOCON[2]	RB80	模式 2 和 3 中接收数据的第 9 位。模式 1 中, SM20 为 0, RB80 为停止位。模式 0 中, 不使用该位。必须由软件清除。
SOCON[1]	TIO	发送中断标识;完成一次串行传输后由硬件置位。必须由软件清除(见上文提示)。
SOCON[0]	RIO	接收中断标识;完成一次串行接收后由硬件置位。必须由软件清除(见上文提示)。

表 20. SICON (UART1)寄存器(SFR 0x9B)

位	符号	功能				
S1CON[7]	SM	设置 UART	设置 UART1 的波特率和模式。			
		SM	模式	说明	波特率]
		0	А	9位 UART	可变]
		1	В	8位 UART	可变	
S1CON[5]	SM21	使能多机通	使能多机通信功能。			
S1CON[4]	REN1	如置位,使能串行接收。由软件清除,禁用接收。				
S1CON[3]	TB81	模式 A 中发送数据的第 9 位。由 MPU 置位或清除,取决于要实现的功能 (奇偶校验、多处理器通信等)。				
S1CON[2]	RB81	模式 A 和 B 止位。必须			B 中,如果 <i>SM21</i>	为 0, <i>RB81</i> 为停
S1CON[1]	TII	发送中断标识,完成一次串行传输后由硬件置位。必须由软件清除(见上文提示)。				
S1CON[0]	RII	接收中断标提示)。	识,完成-	次串行接收后由	硬件置位。必须由统	软件清除(见上文

表 21. PCON 寄存器位说明(SFR 0x87)

位	符号	功能
PCON[7]	SMOD	SMOD 置位时波特率翻倍。

2.4.7 定时器和计数器

80515 有两个 16 位定时器/计数器寄存器:定时器 0 和定时器 1。这些寄存器可配置为计数或定时功能。

定时器模式下,寄存器在每个机器周期递增,即每 12 个 MPU 时钟周期加 1。计数器模式下,每次在相应输入信号 T0 或 T1 (T0 和 T1 为定时器输入,来自于特定的 DIO 引脚,参见第 2.5.10 节数字 I/O)观察到下降沿时,寄存器递增。由于识别一次 1 至 0 跳变需要 2 个机器周期,所以最大输入计数率为 1/2 时钟频率 (CKMPU)。对占空比没有限制,然而为了正确识别 0 或 1 状态,输入应稳定至少 1 个机器周期。

定时器 0 和定时器 1 有四种工作模式可供选择,如表 22 和表 23 所示。TMOD~(SFR~0x89)寄存器(见表 24) 用于选择相应模式。定时器或计数器功能由 TCON~(SFR~0x88)寄存器控制,如表 25 所示。TCON~ 寄存器中的 TR1~(TCON[6])和 TR0~(TCON[4])分别是定时器 1 和定时器 0 的启动位。

丰	22	定时器/计数器模式说明	
æ	ZZ .	AP 11 46/ 11 安X 46/1字 11 1/1 1/1	

M1	МО	模式	功能
0	0	模式 0	13 位计数器/定时器模式,低 5 位位于 <i>TLO</i> 或 <i>TL1</i> (<i>SFR 0x8A 或 SFR 0x8B</i>)寄存器,其余 8 位位于 <i>THO</i> 或 <i>TH1</i> (<i>SFR 0x8C 或 SFR 0x8D</i>)寄存器(分别为定时器 0 和定时器 1)。 <i>TLO</i> 和 <i>TLI</i> 的 3 个位固定为零。
0	1	模式 1	16 位计数器/定时器模式。
1	0	模式 2	8 位自动重装载计数器/定时器。重装载值保存在 $TH0$ 或 $TH1$, $TL0$ 或 $TL1$ 每个机器周期递增。 $TL(x)$ 溢出时, $TH(x)$ 中的值被复制至 $TL(x)$ (其中,x在计数器/定时器 0 时为 0,在计数器/定时器 1 时为 1)。
1	1	模式3	如果定时器 1 的 MI 和 MO 置 1 ,定时器 1 停止。 如果定时器 0 的 MI 和 MO 置 1 ,定时器 0 作为两个独立的 8 位定时器/计数器。



模式 3 中,TL0 受 TR0 和门控位影响,溢出标志位 TF0;TH0 受 TR1 位影响,溢出标志位 TF1。

表 23 给出了定时器 0 和定时器 1 允许的工作模式组合。

表 23. 定时器/计数器模式组合

		定时器 1			
	模式 0	模式1	模式 2		
定时器 0 - 模式 0	允许	允许	允许		
定时器 0 - 模式 1	允许	允许	允许		
定时器 0 - 模式 2	不允许	不允许	允许		

表 24. TMOD 寄存器位说明(SFR 0x89)

位	符号	功能
定时器/计数器	₹ 1	
TMOD[7]	Gate	如果 <i>TMOD</i> [7]置位,使能计数器 1 的外部输入信号控制。 <i>TCON</i> 寄存器(<i>SFR 0x88</i>)中的 <i>TRO</i> 位也必须置位,允许计数器 0 递增。如此设置时,计数器 0 将根据对应的一个或多个 SEGDIO2-11 引脚信号的下降沿递增,如 <i>DIO_R2</i> 至 <i>DIO_R11</i> 寄存器内容规定。参见第 2.5.10 节数字 I/O 和 LCD 段驱动器和表 47。
TMOD[6]	C/T	定时器或计数器的功能选择位。置1时,执行计数器操作。清0时,对应的寄存器作为定时器。
TMOD[5:4]	M1:M0	选择定时器/计数器 0 的模式,如表 22 所示。
定时器/计数器 0		
TMOD[3]	Gate	如果 <i>TMOD[3]</i> 置位,使能计数器 0 的外部输入信号控制。 <i>TCON</i> 寄存器(<i>SFR 0x88</i>)中的 <i>TRI</i> 位也必须置位,以允许计数器 1 递增。如此设置时,计数器 1 将会根据对应的一个或多个 SEGDIO2-11 引脚信号的下降沿递增,如 <i>DIO_R2</i> 至 <i>DIO_R11</i> 寄存器内容规定。参见第 2.5.10 节数字 I/O 和 LCD 段驱动器和表 47。
TMOD[2]	C/T	定时器或计数器的功能选择位。置 1 时,执行计数器操作。清 0 时,对应的寄存器作为定时器。
TMOD[1:0]	M1:M0	选择定时器/计数器 1 的模式,如表 22 所示。

	农 23. ICON 前 存储 应为能(31 K 0000)				
位	符号	功能			
TCON[7]	TF1	定时器 1 溢出标识位,由硬件置位。该位可由软件清零,或响应中断处理时硬件自动清零。			
TCON[6]	TR1	定时器1运行控制位。如清零,定时器1停止。			
TCON[5]	TF0	定时器 0 溢出标志位,由硬件置位。该位可由软件清零,或响应中断处理时硬件自动清零。			
TCON[4]	TR0	定时器0运行控制位。如清零,定时器0停止。			
TCON[3]	IE1	在外部引脚 int1 监测到下降沿时,通过硬件置位中断 1 边沿标志位。响应中断处理时硬件自动清零。			
TCON[2]	IT1	中断 1 类型控制位。选择输入引脚的下降沿或低电平触发中断。			
TCON[1]	IE0	在外部引脚 int0 监测到下降沿时,通过硬件置位中断 0 边沿标志位。响应中断处理时硬件自动清零。			
TCON[0]	ITO	中断 0 类型控制位。选择输入引脚的下降沿或低电平触发中断。			

表 25. TCON 寄存器位功能(SFR 0x88)

2.4.8 WD定时器(软件看门狗定时器)

无内部软件看门狗定时器。代之以标准硬件看门狗定时器(见第 2.5.13 节硬件看门狗定时器)。

2.4.9 中断

80515 提供 11 种中断源,分四个优先级水平。每个中断源在特殊功能寄存器(TCON、IRCON 和 SCON)中都有其自己的中断请求标识。利用 IEN0 (SFR 0xA8)、IEN1 (SFR 0xB8)和 IEN2 (SFR 0x9A)中的使能位,可独立使能或禁用相应中断。图 12 所示为器件中断结构。

参见图 12, 中断源可来自 80515 MPU 核内部(称为内部源)或来自 71M6543 SoC 的其它部分(称为外部源)。 有 7 种外部中断源,如图 12 最左侧及表 26 和表 27 所示(即 *EX0-EX6*)。

中断概述

发生中断时,MPU 向量指向预定义的地址,如表 38 所示。一旦开始中断服务,只有更高优先级的中断才能将其打断。由 RETI 结束中断服务指令并返回。执行 RETI 指令时,处理器返回到发生中断时的下一条指令。

发生中断条件时,处理器置位对应的中断标识位。无论此中断是否使能,该位均被置位。每机器周期采样一次中断标识,然后由硬件轮询。中断使能时,如果采样表明有未处理的中断,则置位中断请求标识。在下一个指令周期,如果满足以下条件,硬件强制 LCALL 转至相应的向量地址,从而响应中断:

- 没有执行相同或更高优先级的中断。
- 当前正在执行某条指令,且尚未完成。
- 正在执行的指令不是 RETI 或者对寄存器 IENO、IEN1、IEN2、IPO 或 IP1 的任何写操作。

用于中断的特殊功能寄存器

以下 SFR 寄存器控制中断功能:

- 中断使能寄存器: IENO、IENI 和 IEN2 (见表 26、表 27 和表 28)。
- 定时器/计数器控制寄存器, TCON和 T2CON (见表 29 和表 30)。
- 中断请求寄存器, IRCON (见表 31)。
- 中断优先级寄存器:IPO 和 IPI (见表 36)。

表 26. IEN0 位功能(SFR 0xA8)

位	符号	功能
IEN0[7]	EAL	<i>EAL</i> = 0 禁用全部中断。
IEN0[6]	WDT	不用于中断控制。
IEN0[5]	_	未使用。
IEN0[4]	ES0	ESO = 0 禁用串行通道 0 中断。
IEN0[3]	ET1	ETI = 0 禁用定时器 1 溢出中断。
IEN0[2]	EX1	EXI = 0 禁用外部中断 1。
IEN0[1]	ET0	ETO = 0 禁用定时器 0 溢出中断。
IEN0[0]	EX0	<i>EX0</i> = 0 禁用外部中断 0。

表 27. IEN1 位功能(SFR 0xB8)

位	符号	功能
IEN1[7]	_	未使用。
IEN1[6]	_	未使用
IEN1[5]	EX6	EX6 = 0 禁用外部中断 6。
IEN1[4]	EX5	EX5 = 0 禁用外部中断 5。
IEN1[3]	EX4	EX4 = 0 禁用外部中断 4。
IEN1[2]	EX3	EX3 = 0 禁用外部中断 3。
IEN1[1]	EX2	EX2 = 0 禁用外部中断 2。
IEN1[0]	_	未使用。

表 28. IEN2 位功能(SFR 0x9A)

位	符号	功能		
IEN2[0]	ES1	<i>ESI</i> = 0 禁用串行通道 1 中断。		

表 29. TCON 位功能(SFR 0x88)

位	符号	功能
TCON[7]	TF1	定时器 1 溢出标识。
TCON[6]	TR1	不用于中断控制。
TCON[5]	TF0	定时器 0 溢出标识。
TCON[4]	TR0	不用于中断控制。
TCON[3]	IE1	外部中断 1 标识。
TCON[2]	IT1	外部中断 1 类型控制位:
		0=低电平中断。
		1 = 下降沿中断。
TCON[1]	IE0	外部中断 0 标识。
TCON[0]	IT0	外部中断 0 类型控制位:
		0=低电平中断。
		1 = 下降沿中断。

表 30	T2CON	位功能	SFR	UXC8)
1 JU.	120011		U 10	

位	符号	功能
T2CON[7]	_	未使用。
T2CON[6]	I3FR	INT3 极性控制
		0 = 下降沿。
		1 = 上升沿。
T2CON[5]	I2FR	INT2 极性控制:
		0 = 下降沿。
		1 = 上升沿。
T2CON[4:0]	_	未使用。

表 31. IRCON 位功能(SFR 0xC0)

位	符号	功能
IRCON[7]	_	未使用。
IRCON[6]	_	未使用。
IRCON[5]	IEX6	1 = 发生外部中断 6, 且尚未清除。
IRCON[4]	IEX5	1 = 发生外部中断 5, 且尚未清除。
IRCON[3]	IEX4	1 = 发生外部中断 4, 且尚未清除。
IRCON[2]	IEX3	1 = 发生外部中断 3, 且尚未清除。
IRCON[1]	IEX2	1 = 发生外部中断 2, 且尚未清除。
IRCON[0]	_	未使用。



TF0 和 TF1 (定时器 0 和定时器 1 溢出标识)由硬件在服务例程调用时自动清零(调用服务例程时,信号 TOACK 和 T1ACK—端口 ISR—高电平有效)。

外部MPU中断

这 7 种外部中断是在 80515 核以外产生的中断,即由 71M6543 其它电路产生,例如:CE、DIO、RTC 或 EEPROM 接口。

外部中断连接如表 32 所示。中断 2 和中断 3 的极性可在 MPU 中通过 T2CON (SFR 0xC8)的 I3FR 和 I2FR 位设置。中断 2 和中断 3 应设置为下降沿触发(I3FR = I2FR = 0)。通用 8051 MPU 资料规定中断 4 至 6 定义为上升沿触发。所以,连接至中断 5 和 6 的下降沿触发信号在内部进行了反相,实现表 32 所示的触发沿极性。

表 32. 外部 MPU 中断

外部中断	连接	极性	标识复位
0	数字 I/O	见 2.5.10	自动
1	数字 I/O	见 2.5.10	自动
2	CE_PULSE	上升	自动
3	CE_BUSY	下降	自动
4	VSTAT (VSTAT[2:0]改变)	上升	自动
5	EEPROM busy (下降), SPI (上升)		自动
6	XFER_BUSY (下降), RTC_1SEC, RTC_1MIN, RTC_T (上升)	下降	手动

外部中断 0 和 1 可通过 DIO 映射表映射到器件引脚,更多信息请参见第 2.5.10 节数字 I/O。

SFR 对应的中断使能位必须置 1,才能允许相应中断发生。同样,每种中断都有其自身的标识位,由中断硬件设置,并由 MPU 响应中断处理程序后复位。除了外部中断 6、4 和使能、标识位外,XFER_BUSY、RTC_1SEC、RTC_1MIN、RTC_T、SPI、PLLRISE 和 PLLFALL 都需要其自身的使能和标识位(见表 33.中断使能和标识位)。



IEO 至 IEX6 在硬件指向中断处理程序后自动清除。其它标识, IE_XFER 至 IE_VPULSE ,必须软件写 0 清除。

由于这些位位于SFR寻址字节内,多数应用中通过位操作将其清除,但在此<u>必须避免</u>。硬件以一个字节宽的"读-修改-写"硬件宏实现位操作。如果在读操作之后、写操作之前发生中断,其标识将被意外清除。

清除标识位的正确方式是写一个掩码,除被清除位为零外,其它位均为 1。标识位写 0 清除,写 1 时硬件忽略。

中断作	使能	中断标	示识	H- MC3X-BB	
名称	位置	名称	位置	中断说明	
EXO	SFR A8[[0]	IE0	SFR 88[1]	外部中断 0	
EX1	SFR A8[2]	IE1	SFR 88[3]	外部中断 1	
EX2	SFR B8[1]	IEX2	SFR C0[1]	外部中断 2	
EX3	SFR B8[2]	IEX3	SFR C0[2]	外部中断 3	
EX4	SFR B8[3]	IEX4	SFR C0[3]	外部中断 4	
EX5	SFR B8[4]	IEX5	SFR C0[4]	外部中断 5	
EX6	SFR B8[5]	IEX6	SFR C0[5]	外部中断 6	
EX_XFER EX_RTC1S EX_RTC1M EX_RTCT EX_SPI EX_EEX EX_YPULSE EX_YPULSE EX_WPULSE EX_VPULSE	2700[0] 2700[1] 2700[2] 2700[4] 2701[7] 2700[7] 2700[6] 2700[5] 2701[6] 2701[5]	IE_XFER IE_RTC1S IE_RTC1M IE_RTCT IE_SPI IE_EEX IE_XPULSE IE_YPULSE IE_WPULSE IE_WPULSE	SFR E8[0] SFR E8[1] SFR E8[2] SFR E8[4] SFR F8[7] SFR E8[7] SFR E8[6] SFR E8[5] SFR F8[4] SFR F8[3]	XFER_BUSY 中断(int 6) RTC_1SEC 中断(int 6) RTC_1MIN 中断(int 6) RTC_T 报警时钟中断(int 6) SPI 中断 EEPROM 中断 CE_XPULSE 中断(int 2) CE_YPULSE 中断(int 2) CE_WPULSE 中断(int 2) CE_VPULSE 中断(int 2)	

表 33. 中断使能和标识位

中断优先级结构

所有中断源被划分成组,如表 34 所示。

组 组成内容 0 外部中断 0 0 外部中断 0 1 定时器 0 中断 1 定时器 0 中断 2 2 外部中断 1 外部中断 1 3 3 定时器1中断 定时器1中断 4 4 串行通道0中断 串行通道0中断 5 5

表 34. 中断优先级组

通过置位或清除 SFR 中断优先级寄存器 *IPO* (SFR 0xA9)和 *IPI* (SFR 0xB9) (表 36)中的某一位,可以将每组中断源设置到四个优先级之一(如表 35 所示)。如果同时接收到相同优先级中断请求,8051 将会按照表 37 所示的内部轮询顺序决定首先处理哪个请求。



如果在中断使能的情况下修改中断优先级,此时很容易引起软件问题。因此推荐在中断使能之前时初始化中断优先级。

表 35. 中断优先级

IP1[x]	<i>IP0</i> [x]	优先级
0	0	优先级 0 (最低)
0	1	优先级 1
1	0	优先级 2
1	1	优先级 3 (最高)

表 36. 中断优先级寄存器(IP0 和 IP1)

寄存器	地址	第7位 (MSB)	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第 0 位 (LSB)
IP0	SFR 0xA9	-	1	IP0[5]	IP0[4]	IP0[3]	IP0[2]	IP0[1]	IP0[0]
IP1	SFR 0xB9	_	_	IP1[5]	IP1[4]	IP1[3]	IP1[2]	IP1[1]	IP1[0]

表 37. 中断轮询排序

外部中断 0	
串行通道 1 中断	
定时器 0 中断	
外部中断 2	
外部中断 1	:序
外部中断 3	轮询排序
定时器 1 中断	轮
外部中断 4	
串行通道 0 中断	
外部中断 5 ▼	
外部中断 6	

中断源和向量

表 38 中列出了中断及其对应的标识和向量地址。

表 38. 中断向量

中断请求标识	说明	中断向量地址
IE0	外部中断 0	0x0003
TF0	定时器 0 中断	0x000B
IE1	外部中断 1	0x0013
TF1	定时器 1 中断	0x001B
RIO/TIO	串行通道 0 中断	0x0023
RI1/TI1	串行通道 1 中断	0x0083
IEX2	外部中断 2	0x004B
IEX3	外部中断 3	0x0053
IEX4	外部中断 4	0x005B
IEX5	外部中断 5	0x0063
IEX6	外部中断 6	0x006B

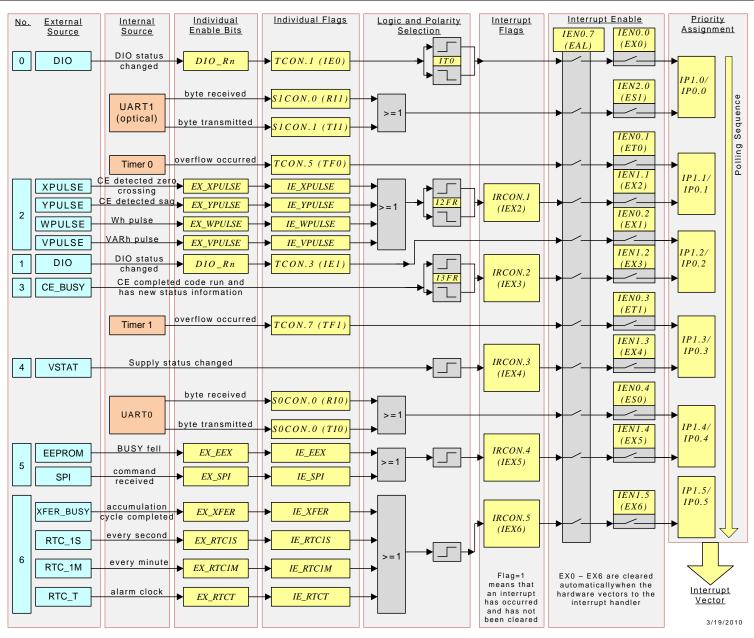


图 12. 中断结构

2.5 片上资源

2.5.1 物理存储器

2.5.1.1 闪存模式

器件包括 64KB (71M6543F/H)和 128KB (71M6543G/GH)片上 FLASH,用来装载 MPU 和 CE 程序代码。 它还包括 CE RAM 和 I/O RAM 映像。上电时,使能 CE 之前,MPU 需要将这些映像复制到各自位置。

CE 程序空间限制为 4096 个 16 位字(8KB), CE 程序必须在闪存空间的 1KB 边界处作为起始地址。71M6543F/H 的 CE_LCTN[6/5:0] (I/O RAM 0x2109[5:0])字段和 71M6543G/GH 的 CE_LCTN[6:0] (I/O RAM 0x2109[6:0])字段定义哪个 1KB 边界包含 CE 代码。所以,第一条 CE 指令位于 71M6543F/H 的 1024*CE LCTN[5:0]和71M6543G/GH 的 1024*CE LCTN[6:0]。

FLASH可由 MPU、CE 及 SPI 接口(读/写)访问。

 访问者
 访问类型
 条件

 MPU
 R/W/E
 只有 CE 禁用时才能写和擦除(W/E)。

 CE
 R

 SPI
 R/W/E
 只有调用 SFM (MPU 暂停)时才可访问。

表 39. 闪存访问

FLASH写操作步骤

如果 $FLSH_UNLOCK[3:0]$ (I/O RAM 0x2702[7:4])密钥设置正确,MPU 可写入 FLASH。这是除外部 EEPROM 之外,用户可以操作的非易失存储器之一。

FLASH程序写使能位 *FLSH_PSTWR* (*SFR 0xB2[0]*)用来区分存储器指令(MOVX@DPTR,A)操作的是 FLASH还是 XRAM。该位由硬件在每个字节写操作之后自动清零。使能中断时,禁止对该位进行写操作。

如果 CE 位使能($CE_E = 1$, I/O RAM 0x2106[0]),FLASH 写操作只有在 $FLSH_PSTWR$ 置位时才有效,该位使能"posted flash write"。 $CE_E = 0$ 时, $FLSH_PSTWR$ 操作无效;而 $CE_E = 1$ 时, $FLSH_PSTWR$ 延迟FLASH 写操作,延时间隔为 CE 程序的执行周期。延迟时间内, $FLSH_PEND$ (SFR 0xB2[3])置 1,MPU 继续执行命令。CE 程序周期结束时(CE_BUSY 变低), $FLSH_PEND$ 位清零,同时进行写操作。MPU 可查询 $FLSH_PEND$ 位,确定何时完成写操作。 $FLSH_PEND = 1$ 时,忽略其它 FLASH 写操作请求。

更新FLASH的个别字节

FLASH 单元的初始值为 0xFF (全部位为 1)。将非 0xFF 数值写入 FLASH 单元时,首先需要擦除该单元。由于单元不能独立擦除,所以需要将整页内容复制到 RAM,然后擦除该页。之后,更新需要的 RAM 内容,再写回至 FLASH。

FLASH擦除步骤

按照一定的顺序,将特定的操作码写入至特定 SFR 寄存器,才能启动 FLASH 擦除功能。这些特殊的操作码/顺序可以防止 FLSH 的意外擦除。

整体擦除顺序为:

- 写 1 至 FLSH MEEN 位(SFR 0xB2[1])。
- 写操作码 OxAA 至 FLSH_ERASE 寄存器(SFR 0x94)。



该功能只有在 ICE 端口使能时才有效。

页擦除顺序为:

- 写页地址至 FLSH_PGADR[5:0] (SFR 0xB7[7:2])。
- 写操作码 0x55 至 FLSH ERASE 寄存器(SFR 0x94)。

71M6543G/GH存储区交换

71M6543G/GH 中的 128 KB 程序存储器包括固定 32 KB 低地址(地址从 0x0000 至 0x7FFF)存储区和 32 KB 高地址存储区(地址从 0x8000 至 0xFFFF)。I/O RAM 寄存器 FL_BANK[1:0] (SFR 0xB6[1:0])用于将四个 32 KB 存储区切换到地址范围 0x8000 至 0xFFFF。注意,FL_BANK[1:0] (SFR 0xB6[1:0]) = 0 时,高地址存储区与低地址存储区相同。

71M6543G/GH FL_BANK[1:0]	低地址存储区(0x0000- 0x7FFF)	高地址存储区(0x8000- 0xFFFF)
00	0x0000-0x7FFF	0x0000-0x7FFF
01	0x0000-0x7FFF	0x8000-0xFFFF
10	0x0000-0x7FFF	0x10000-0x17FFF
11	0x0000-0x7FFF	0x18000-0x1FFFF

表 40. 71M6543G/GH 中利用 FL_BANK[1:0] (SFR 0xB6[1:0])进行存储区切换

71M6543G/GH 中,*FLSH_PGADR[6:0]* (*SFR 0xB7[7:1]*)指向的程序地址空间可参考不同的闪存单元,取 决于 *FL_BANK[1:0]* (*SFR 0xB6[1:0]*)位的设置。另一方面,71M6543G/GH 中的 *CE_LCTN[6:0]* (*I/O RAM 0x2109[6:0]*)字段直接指向闪存的一个单元,不受 *FL BANK[1:0]* (*SFR 0xB6[1:0]*)位的影响。

程序加密

加密位使能时,安全机制将限制除全局 FLASH 擦除之外的任何 ICE 操作,例如,通过 SPI 接口或 ICE 端口的读操作,确保用户 MPU 和 CE 程序代码的安全性。用户需要在主程序执行前的 64 个 CKMPU 周期内使能 SECURE 位,启用加密功能。一旦加密机制使能,将其禁用的唯一方式是执行 FLASH 全局擦除,然后进行芯片复位。

MPU 引导代码的前 60 个周期称为预引导阶段,ICE 在该阶段禁用。PREBOOT (SFR 0xB2[7])位是该阶段的只读状态位,MPU 可以通过它识别启动阶段。完成预引导后,可使能 ICE,并允许控制 MPU。

芯片复位时,安全使能位 SECURE (SFR 0xB2[6])也同时复位,与该位相关的硬件只允许写 1。所以,在预引导代码内需要置位 SECURE 位来使能安全功能,但无法取消该功能。一旦 SECURE 置位,预引导和 CE代码受到保护,不会被擦除,也无法从外部读取任何程序代码。

具体说, SECURE 置位时:

- ICE 仅限于整体 FLASH 擦除。
- FLASH 的 0 页,用户预引导代码的首选位置,不可被 MPU 或 ICE 页擦除。第 0 页只能通过全局 FLASH 擦除。
- 禁止 MPU 或 ICE 对第 0 页进行写操作。

71M6543 还具有防止意外写入及擦除 FLASH 的硬件机制。为了使能 FLASH 写入和擦除操作,必须向 $FLSH_UNLOCK[3:0]$ 字段写入 4 位硬件密钥。密钥为二进制数'0010'。如果 $FLSH_UNLOCK[3:0]$ 不是'0010',硬件禁止 FLASH 擦除和写操作。在 SPI FLASH 编程(SFM 模式)时,密钥应由外部 SPI 主控器件写入;或者在 ICE FLASH 编程时,通过 ICE 接口写入。使用装载器功能时,应该将密钥送至装载程序,由装载程序将其写入 $FLSH_UNLOCK[3:0]$ 。 $FLSH_UNLOCK[3:0]$ 不自动复位,应该在 SPI 或 ICE 结束更改 FLASH 时将其清零。表 41 中汇总了用于 FLASH 安全的 I/O RAM 寄存器。

寿	41	ı	וֹגוֹ	存加密
AX.	-		ויע	TH //// Th

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明
FLSH_UNLOCK[3:0]	2702[7:4]	0	0	R/W	必须为 2, 才允许闪存写操作,更多详情参
					见 FLASH 安全说明。
SECURE	SFR B2[6]	0	0	R/W	禁止擦除第0页及71M6543F/H
					CE_LCTN[6/5:0] (I/O RAM 0x2109[5:0])和
					71M6543G/GH
					0x2109[6:0])定义的CE代码起始地址以上的
					存储空间。也禁止通过ICE和SPI端口读
					FLASH.

SPI Flash模式

一般器件的 SPI 从接口不能读或写 FLASH。然而,71M6543 具有特殊 FLASH 模式(SFM),以方便用户的 初始(生产)编程。71M6543 处于 SFM 模式时,SPI 接口可擦除、读和写 FLASH。该模式下,SPI 不可访问 其它存储器元件,例如 XRAM 和 I/O RAM。为保护 FLASH 内容,需要几步操作才能启动 SFM 模式。

71M6543G/GH 工作于 SFM 时,采用 SPI 单字节传输写 *FL_BANK[1:0]* (*SFR 0xB6[1:0]*)。SPI 单字节传输 期间,*SPI_CMD[1:0]*将覆盖 *FL_BANK[1:0]* (*SFR 0xB6[1:0]*)的内容。这将允许在 SFM 模式下访问整个 128 KB 闪存。

关于 SFM 详情请参见第 2.5.12 节 SPI 从机接口。

2.5.1.2 MPU/CE RAM

71M6543 包括 5KB 片上静态 RAM 存储器(XRAM)和 MPU 核的 256 字节内部 RAM。5KB 静态 RAM 用于 MPU 和 CE 操作的数据存储,以及 MPU 和 CE 之间的通信。

2.5.1.3 I/O RAM (配置RAM)

I/O RAM 可看做是一系列控制基本硬件功能的寄存器。I/O RAM 地址空间从 0x2000 开始。表 69 列出了 I/O RAM 寄存器。

71M6543 在 I/O RAM 地址空间包括 128 字节片上非易失 RAM 存储器(地址 0x2800 至 0x287F)。该存储器部分由 VBAT_RTC 引脚的电压支持,只要 VBAT_RTC 上的电压处于规定范围内,在 BRN、LCD 和 SLP 模式下就可保持其中的数据。

2.5.2 振荡器

振荡器驱动标准的 32.768kHz 钟表晶体。这种类型的晶体具有较高精度,且驱动功耗很小。振荡器经过特殊设计,配合钟表晶体工作,支持高阻、低功耗操作。振荡器功耗非常低,可有效延长连接至 VBAT_RTC 的电池寿命。

振荡器校准可提高 RTC 和表计精度, 更多信息请参见第 2.5.4 节实时时钟(RTC)。

振荡器由 V3P3SYS 引脚或 VBAT_RTC 引脚供电,取决于 V3OK (即如果 V3P3SYS \geq 2.8 VDC, V3OK = 1;如果 V3P3SYS < 2.8 VDC,V3OK = 0)。振荡器消耗大约 100nA,相对于电池内部漏电流可忽略不计。 尽管没有连接 VBAT 时振荡器可以工作,但不建议这种工作模式。



如果 VBAT_RTC 连接到过放电电池或断开电池连接,设置 *TEMP_BAT* 电池测试可能会消耗连接至 VBAT_RTC 的电池能量,造成振荡器停振。振荡器停止工作会强制器件复位。所以,电池测试期间 的意外复位可认为是电池故障。

2.5.3 PLL和内部时钟

器件时钟源来自 32.768 kHz 晶振输出,经过 PLL 倍频 600 倍,得到 19.660800 MHz 的主控时钟(MCK)。除 RTC 时钟之外,所有片上定时都源于 MCK。表 42 为时钟功能及其控制汇总。

MPU 中的两个通用计数器/定时器由 CKMPU 控制(参见第 2.4.7 节定时器和计数器)。

通过设置 PLL_FAST 位= 1 (I/O RAM Ox2200[4]),主控时钟频率可升至 19.66MHz;通过设置 PLL_FAST = 0,可降至 6.29MHz。MPU 时钟频率 CKMPU 可由 I/O RAM 控制字段 $MPU_DIV[2:0]$ (I/O RAM Ox2200[2:0])控制分频输出,设为 MCK*2-(MPU_DIV+2),其中, $MPU_DIV[2:0]$ 为 0 至 4。ICE_E 引脚为高电平时,电路还产生 9.83MHz 时钟,供仿真器使用。

LCD_BSTE 禁用时,PLL 只有在 SLP 模式或 LCD 模式下关闭。LCD_BSTE 取决于 *LCD_VMODE* [1:0]字 段的设置(见表 52)。

该部件从 SLP 或 LCD 模式唤醒时,PLL 在 6.29 MHz 模式下开启, PLL_OK 标识($SFR_OxF9[4]$)置 1 之前 PLL 频率不精确。由于潜在的过冲,在 PLL_OK 为 1 之前,MPU 不应更改 PLL_FAST 值。

表 42. 时钟系统汇总

时钟	源自		固定频率或范围		功能
P1 17T	<i>i</i>	PLL_FAST=1	PLL_FAST=0	控制	切肥
OSC	晶体	32.76	8 kHz	_	晶振时钟
мск	晶体/PLL	19.660800 MHz (600*CK32)	6.291456 MHz (192*CK32)	PLL_FAST	主控时钟
CKCE	MCK	4.9152 MHz	1.5728 MHz		CE 时钟
CKADC	MCK	4.9152 MHz, 2.4576 MHz	1.572864 MHz, 0.786432 MHz	ADC_DIV	ADC 时钟
CKMPU	MCK	4.9152 MHz 307.2 kHz	1.572864 MHz 98.304 kHz	MPU_DIV[2:0]	MPU 时钟
CKICE	MCK	9.8304 MHz 614.4 kHz	3.145728 MHz 196.608 kHz	MPU_DIV[2:0]	ICE 时钟
CKOPTMOD MCK		38.40 kHz	38.6 kHz	_	光 UART 调 制
CK32	MCK	32.76	8 kHz	_	32kHz 时钟

2.5.4 实时时钟(RTC)

2.5.4.1 RTC概述

RTC 由晶振直接驱动,由 V3P3SYS 引脚或 VBAT_RTC 引脚供电,取决于 V3OK。RTC 由计数器链和输出寄存器组成。计数器链由秒、分、时、星期、日、月和年寄存器组成。链寄存器支持影子寄存器功能,方便读写操作。

表 43 列出了 RTC 控制的 I/O RAM 寄存器。

2.5.4.2 访问RTC

RTC RD (I/O RAM 0x2890[6])位和 RTC WR (I/O RAM 0x2890[7])位,用控制影子寄存器功能。

RTC_RD 为低电平时,RTC 每 2ms 更新一次影子寄存器。RTC_RD 为高电平时,暂停更新,影子寄存器内容保持不变,适合 MPU 读取。所以,MPU 希望读取 RTC 时,通过设置 RTC_RD 位冻结影子寄存器,读取影子存器,然后将 RTC_RD 位置低,恢复更新影子寄存器。RTC_RD 位在 RTC 更新完影子寄存器后自动清除。由于 RTC 更新频率 500Hz,因此 RTC_RD 位从高变低到影子寄存器接收第一次更新,大约延迟 2ms。

RTC_WR 为高电平时,也禁止影子寄存器的更新。在此期间,MPU 可以修改影子寄存器的内容。RTC_WR 变低时,硬件电路将在下一个 500Hz 时钟通过影子寄存器写入 RTC 计数器。影子寄存器中的每个字包括一个"变更位",确保 MPU 向 RTC_WR 写 0 时只更新编程字。RTC_WR 位在 RTC 将影子寄存器更新至 RTC 寄存器之后自动清除。

RTC 的亚秒寄存器 RTC_SBSC (I/O RAM 0x2892)在一秒中断之后、下一秒中断边界之前可由 MPU 读取。 RTC_SBSC 寄存器表示到下一个秒边界剩余的 1/128 秒周期的数量。写 RTC_SBSC 位,重新开始 SUBSEC 计数,从 0 至 127。读和复位亚秒计数器可作为准确设置 RTC 算法的一部分。

RTC 能够处理闰年。每个计数器都有其自身的输出寄存器。RTC 链寄存器不受复位引脚、看门狗定时器复位或电池模式和任务模式之间转换的影响。

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明
RTCA_ADJ[6:0]	2504[6:0]	40		R/W	用于模拟 RTC 频率调节的寄存器。
RTC_P[16:14] RTC_P[13:6] RTC_P[5:0]	289B[2:0] 289C[7:0] 289D[7:2]	4 0 0	4 0 0	R/W	用于数字 RTC 调节的寄存器。有效范围: 0x0FFBF ≤ <i>RTC_P</i> ≤ 0x10040
RTC_Q[1:0]	289D[1:0]	0	0	R/W	用于数字 RTC 调节寄存器。
RTC_RD	2890[6]	0	0	R/W	冻结 RTC 影子寄存器,使其适合于 RTC 读取。 读 RTC_RD 时,返回影子寄存器的状态:0 = 更新,1 = 冻结。 写 0 至 RTC_RD 位启用影子寄存器更新,写 1 至 RTC_RD 禁用更新。
RTC_WR	2890[7]	0	0	R/W	冻结 RTC 影子寄存器,使其适合于 RTC 写操作。清除 RTC_WR时,在下一个 RTC 时钟(大约 1 kHz))将影子寄存器的内容写入 RTC 寄存器。读 RTC_WR 时,只要 RTC_WR 置位,则返回 1。在 RTC 寄存器更新之前,它将继续返回 1。写 0 至 RTC_WR 位启用将影子寄存器内容复制到 RTC 计数器,写 1 至 RTC_WR 禁用复制。
RTC_FAIL	2890[4]	0	0	R/W	表示 RTC 发生计数错误,此时时间不可信。该位可通过写 0 清除。
RTC_SBSC[7:0]	2892[7:0]			R	自上 1 秒边界的时间, LSB = 1/128 秒。

表 43. RTC 控制寄存器

2.5.4.3 RTC频率控制

71M6543 提供两种频率修正方法:

- 第一种方法是模拟频率修调,使用 I/O RAM 寄存器 RTCA ADJ[6:0],微调晶振负载电容。
- 第二种方法是数字频率修正,调整 RTC 时钟频率。

将 RTCA_ADJ[6:0]设为 00,对应负载电容最小化,振荡器频率最大化。将 RTCA_ADJ[6:0]设为 0x7F,将负载电容最大化,振荡器频率最小化。可调电容大约为:

$$C_{ADJ} = \frac{RTCA_ADJ}{128} \cdot 16.5 pF$$

最小调整量取决于晶振特性、PCB 布局及外部晶振电容(详见表 89, CXS 和 CXS)。任何时候均可调节,并应该在 1 秒间隔内测量获得的时钟频率。

第二种频率微调的方法为数字式,调节范围±988ppm,分辨率为 3.8 ppm。在调整后的下一秒边界开始执行频率调整。由于 LSB(最低有效位)使得每 4 秒调整一次,应在 4 秒的整数倍间隔内测量频率。

通过向 $RTC_P[16:0]$ (I/O RAM 0x289B[2:0]、0x289C, 0x289D[7:2])和 $RTC_Q[1:0]$ (I/O RAM 0x289D[1:0])写入相应数值调节时钟频率。如上所述,通过影子寄存器更新 RTC 速率调节寄存器 RTC_P 和 RTC_Q 。 $RTC_WR_{1/O}$ RAM 0x2890[7])降低时,新值被加载至计数器。

默认频率为 32,768 RTCLK 周期/秒。为了将时钟频率改变 Δppm ,利用下式计算 RTC_P 和 RTC_Q :

$$4 \cdot RTC_P + RTC_Q = floor \left(\frac{32768 \cdot 8}{1 + \Delta \cdot 10^{-6}} + 0.5 \right)$$

相反,给定 4RTC P+RTC Q数值时,ppm 变化量为:

$$\Delta(ppm) = \left(\frac{32768 \cdot 8}{4 \cdot RTC_P + RTC_O} - 1\right) \cdot 10^6$$

例如,对于-988ppm 的变化,4·*RTC_P* + *RTC_Q* = 262403 = 0x40103。*RTC_P*[16:0] = 0x10040 (I/O RAM 0x289B[2:0], 0x289C, 0x289D[7:2]) , *RTC_Q* [1:0]= 0x03(I/O RAM 0x289D[1:0] 。 *RTC_P*[16:0] 和 *RTC_Q*[1:0],的默认值分别为 0x10000 和 0x0,对应于 0 调节。

TMUX2OUT 测试引脚的两种设置,PULSE_1S 和 PULSE_4S,可用于测量和校准 RTC 时钟频率。其占空比大约为 25%,周期为 1s 或 4s 的方波。



 $RTCA_ADJ$ [6:0]、 RTC_P [16:0]和 RTC_Q [1:0]的默认值应为标称值,处于调节范围的中间。没有校准调节的数值 (例如,0)会造成工作不正常。

如果已知晶振的温度系数,MPU 可根据集成温度传感器,在必要时修正 RTC 时钟。或者,将温度补偿值 写入 RTC 调整 NV RAM,并置位 OSC_COMP 位(I/O RAM 0x28A0[5])。这种情况下,即使在 LCD/SLP 模式,振荡器也可以自动修正。详情请参见 2.5.4.4 RTC 温度补偿部分。

2.5.4.4 RTC温度补偿

71M6543 可配置为定期测量管芯温度,包括 SLP 模式、LCD 模式和 MPU 停止模式。如果由 OSC_COMP 位使能,硬件电路可根据温度信息查表修正晶振输出频率,采用查找表方法。

表 44 所示为用于自动 RTC 温度补偿的 I/O RAM 寄存器。

名称 复位 说明 位置 唤醒 方向 使能 RTC P[16:0]和 RTC O[1:0]在每次温度测量 OSC COMP 28A0[5] 0 0 R/W 时被自动更新。 2881[7:0] STEMP[10:3] 温度测量结果(10位数据加1个符号位)。 R STEMP[2:0] 2882[7:5] R/W LKPADDR[6:0] 2887[6:0] 0 0 读和写 RTC 查找表的 RAM 地址。 自动递增标识。置位时, LKPADDR[6:0]在 LKP RD 或 LKP WR 位在每次触发后自动递增。 **LKPAUTOI** 2887[7] 0 0 R/W 递增地址可从 LKPADDR[6:0]读取。 读/写 RTC 查找 RAM 数据。 R/W *LKPDAT*[7:0] 2888[7:0] 用于 RTC 查找表 RAM 读/写的选通位。置位时, LKPADDR[6:0]和 LKPDAT 寄存器用于读或写操, LKP_RD 2889[1] 0 R/W 0 2889[0] LKP_WR 0 0 R/W 操作完成后选通位硬件清除。如果此时 LKPAUTOI 置位, LKPADDR[6:0] 自动递增。

表 44. 用于 RTC 温度补偿的 I/O RAM 寄存器

参见图 13, 查表法通过将 STEMP[10:0]寄存器中的 10 位+符号位数值右移 2 位,获得 8 位+符号位数值(即 NV RAM 地址 = STEMP[10:0]/4)。限制器确保得到的查找地址在 6 位加符号位范围:-64 至+63 (十进制)之内。地址指向的 8 位 NV RAM 内容作为 2 的补码增加至 4*RTC P[16:0] + RTC O[1:0]标称值,0x40000。

关于利用寄存器 $RTC_P[16:0]$ 和 $RTC_Q[1:0]$ 进行时钟频率调整的内容,请参见第 2.5.4.3 节 RTC 频率控制。必须正确定标加载至 NV RAM 的 8 位值,以便与第 2.5.4.3 节 RTC 频率控制给定的 $RTC_P[16:0]$ 和 $RTC_Q[1:0]$ 公式一致。注意,8 位 2 的补码查找值与 0x40000 之和构成一个 19 位数值,等于 $4*RTC_P[16:0] + RTC_Q[1:0]$,如图 13 所示。每次查找及求和运算后,温度补偿输出自动加载 $RTC_P[16:0]$ 和 $RTC_Q[1:0]$ 寄存器。

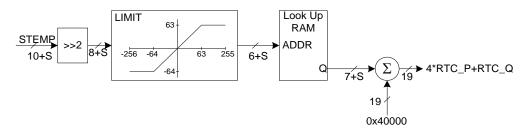


图 13. 自动温度补偿

128 个 NV RAM 单元以 2 的补码形式组合。如上所述,STEMP[10:0]数字温度补偿值标定为对应 NV RAM 地址等于 STEMP[10:0]/4 (限制在-64 至+63)。关于利用 STEMP[10:0]读数计算温度值(以℃ 为单位)的公式,请参见第 55 页的第 2.5.5 节 71M6543 温度传感器。

为确保正确工作,MPU 必须将反映晶体温度特性的数值加载至查找表,通常在初始化期间完成。由于不能直接寻址查找表,MPU 需采用以下步骤加载整个 NV RAM 表:

- 1. 将 LKPAUTOI 位 (I/O RAM 0x2887[7])置位, 使能地址自动递增。
- 2. 向 I/O RAM 寄存器 LKPADDR[6:0] (I/O RAM 0x2887[6:0])写 0。
- 3. 将 8 位数据写至 I/O RAM 寄存器 LKPDAT (I/O RAM 0x2888)。
- 4. 将 LKP WR 位(I/O RAM 0x2889[0])置位,将 8 位数据写至 NV RAM。
- 5. 等待 *LKP_WR* 清零(*LKP_WR* 在数据复制到 NV RAM 后自动清零)。
- 6. 重复第 3 步至第 5 步, 直到将全部数据写至 NV RAM。

NV RAM 亦可通过将 1 写入 *LKP_RD* 位(*I/O RAM 0x2889[1]*)读取。通过置位 *LKPAUTOI* 位(*I/O RAM 0x2887[7]*),可加快读/写 NV RAM 的过程。*LKPAUTOI* 置位时,*LKPADDR[6:0]* (*I/O RAM 0x2887[6:0]*)在 *LKP_RD* 或 *LKP_WR* 每次触发后自动递增。通过写 0 至 *LKPAUTOI* 位,并将相应地址加载至 *LKPADDR[6:0]*,可随机存取 NV RAM。



如果未使用振荡器的温度补偿功能,可将 NV RAM 存储区作为普通电池备份的 NV 存储空间,利用以上介绍的步骤读/写 NV RAM 数据。这种情况下,保持 OSC_COMP 位(I/O RAM 0x28A0[5]) 处于复位状态,即禁用自动振荡器温度补偿特性。

2.5.4.5 RTC中断

RTC 每秒和每分钟产生中断。这些中断称为 RTC_1SEC和 RTC_1MIN。此外,RTC 还具有闹钟功能,分钟和小时寄存器等于定义的相应数值时,产生中断。闹钟中断称为 RTC_T。三种中断均在 MPU 的外部中断 6。关于这些中断的使能位和标识,请参见中断部分的表 33。

表 45 列出了分钟和小时的目标寄存器。

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明
RTC_TMIN[5:0]	289E[5:0]	0	0	R/W	目标分钟寄存器,参见下文。
RTC_THR[4:0]	289F[4:0]	0	0	R/W	目标小时寄存器。 <i>RTC_T</i> 中断, <i>RTC_MIN[5:0]</i> 等于 <i>RTC_TMIN[5:0]</i> 且 <i>RTC_HR</i> [4:0]等于 <i>RTC_THR</i> 时,发 生 <i>RTC_T[4:0]</i> 中断。

表 45. 用于 RTC 中断的 I/O RAM 寄存器

2.5.5 71M6543 温度传感器

71M6543 具有片上温度传感器,确定其带隙基准的温度。温度数据的主要用途是对计量(电流、电压和能量)及 RTC 进行温漂补偿。请参见第 89 页 4.5 节计量温度补偿,另请参考第 53.页 2.5.4.4 节 RTC 温度补偿。

与前几代 Teridian SoC 不同,71M6543 不与计量部分共用 ADC 转换温度,而是采用一片低功耗 ADC,支持 SLP、LCD 模式,以及 BRN 和 MSN 模式的测量需求。这意味着即使在 MPU 暂停操作的 SLP 模式下,也可以对晶振频率进行温度补偿,参见第 53.页 2.5.4.4 节 RTC 温度补偿。

MSN 和 BRN 模式下,通过置位 *TEMP_START (I/O RAM 0x28B4[6])*控制位,利用命令唤醒温度传感器。 SLP 和 LCD 模式下,以 *TEMP PER[2:0] (I/O RAM 0x28A0[2:0])*设定的间隔定期唤醒。

从两个 I/O RAM 地址 *STEMP[10:3]* (I/O RAM 0x2881)和 *STEMP[2:0]* (I/O RAM 0x2882[7:5])读取温度测量结果。注意,必须读取这两个 I/O RAM 地址并正确组合,构成 *STEMP[10:0]*的 11 位数值(见表 46 中的 *STEMP*)。所得到的 11 位数值为 2 的补码,范围从-1024 至+1023 (十进制)。

以下公式用于计算检测到的温度。第一个公式适用于 71M6543F 和 71M6543G 工作在 MSN 模式及 TEMP_PWR = 1 的条件下。第二个公式用于 71M6543F 和 71M6543G 处于 BRN 模式下,这种情况下,TEMP_PWR 和 TEMP_BSEL 位必须设为相同值,从而检测为温度传感器供电的电池,BSENSE 为电池电压测量值。所以,第二个公式需要读取 STEMP 和 BSENSE。第二个公式中,芯片处于 BRN 模式时,BSENSE (检测到的电池电压)用于获取更准确的温度读数。第二组公式适用于 71M6543H 和 71M6543GH 高精密器件。以下各个 STEMP 公式中的系数为典型值。

71M6543F 和 71M6543G 处于 MSN 模式时(TEMP PWR = 1):

$$Temp(^{\circ}C) = 0.325 \cdot STEMP + 22$$

71M6543F 和 71M6543G 处于 BRN 模式时(TEMP_PWR = TEMP BSEL):

$$Temp(^{\circ}C) = 0.325 \cdot STEMP + 0.00218 \cdot BSENSE^2 - 0.609 \cdot BSENSE + 64.4$$

71M6543H 和 71M6543GH 处于 BRN 模式时(TEMP_PWR=TEMP_BSEL):

如果 $STEMP \leq 0$:

$$Temp(^{\circ}C) = 0.325 \cdot STEMP + 0.00218 \cdot BSENSE^2 - 0.609 \cdot BSENSE + 64.4$$

如果 *STEMP* > 0:

$$Temp(^{\circ}C) = \frac{63 \cdot STEMP}{TEMP \ 85} + 0.00218 \cdot BSENSE^2 - 0.609 \cdot BSENSE + 64.4$$

表 46 列出了用于温度和电池测量的 I/O RAM 寄存器。



如果 *TEMP_PWR* 选择 *VBAT_RTC*,并且电池电量已经耗尽,可能无法完成温度测量过程。这种情况下,必须选择 V3P3D (*TEMP_PWR* = 1)供电方式来实现正常的温度测量。

表 46. 用于温度和电池测量的 I/O RAM 寄存器

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明							
TBYTE_BUSY	28A0[3]	0	0	R	表示硬件仍然在写 0x28A0 字节;为 1 时,不允对该字节进行写操作。写操作持续时间可长6ms。							
TEMP_PER[2:0]	28A0[2:0]	0	_	R/W	设置两次温度测量之间的时间间隔,任何模式 (MSN、BRN、LCD 或 SLP)下均可使能自动测量。 TEMP_PER 时间							
TEMP_BAT	28A0[4]	0	_	R/W	只要进行温度测量,则测量 VBAT。							
TEMP_START	28B4[6]	0	_	R/W	TEMP_PER[2:0] 必须清零,使 TEMP_START 生效。 如果 TEMP_PER[2:0] = 0 ,置位TEMP_START 开始温度测量。SLP和LCD模式下忽略。 完成温度测量时,硬件清除TEMP_START。							
TEMP_PWR	28A0[6]	0	_	R/W	选择温度传感器电源: 1 = V3P3D, 0 = VBAT_RTC。SLP和LCD模式 下忽略该位,总是由 VBAT_RTC供电。							
TEMP_BSEL	28A0[7]	0	_	R/W	选择温度传感器监测的电池:1 = VBAT, 0 = VBAT_RTC。							
TEMP_TEST[1:0]	2500[1:0]	0	_	R/W	该位用于监测 VCO 温度。常规工作时, TEMP_TEST 必须为 00。其它任何值都会造成 VCO 以如下控制电压连续运行。 TEM□_TEST 功能 00 正常工作 01 保留,用于工厂测试 1X 保留,用于工厂测试							
STEMP[10:3] STEMP[2:0]	2881[7:0] 2882[7:5]			R R	温度测量结果。通过单次 16 位读操作,然后除以 32, 可获得以 C 为单位的 STEMP[10:0]值, 如下所示:							
BSENSE[7:0]	2885[7:0]	_	_	R	电池测量结果。							
BCURR	2704[3]	0	0	R/W	将 100μA 负载连接至 TEMP_BSEL 所选电池。							

2.5.6 71M6xx3 温度传感器

71M6xx3 具有片上温度传感器,用于确定其带隙基准的温度。温度数据的主要用途是对 71M6xx3 的电流 计量进行温度补偿。关于利用 71M6xx3 的 *STEMP[10:0]*读数计算温度的公式,请参见 71M6xxx 的数据资料。另请参见第 89 页第 4.5 节计量温度补偿。

关于如何从 **71M6xx3** 读取 **STEMP[10:0]**信息的介绍,请参见第 **22** 页第 **2.2.8.3** 节 **71M6xx3** 隔离传感器的控制。

v1.2

2.5.7 71M6543 电池监测器

71M6543 温度测量电路还可监测 VBAT 和 VBAT_RTC 处的电池。被测电池(即 VBAT 或 VBAT_RTC 引脚) 由 TEMP BSEL (I/O RAM 0x28A0[7])选择。

TEMP_BAT (I/O RAM 0x28A0[4])置位时,测量电池作为每次温度测量的一部分。电池读数储存在寄存器 BSENSE[7:0] (I/O RAM 0x2885)。以下公式用于从 BSENSE[7:0] 和 STEMP[10:0]计算在 VBAT 引脚(或 VBAT_RTC 引脚)上测得的电压。下式结果以伏特为单位:MSN 模式和 BRN 模式的公式稍有不同,如下所示。

MSN 模式下, TEMP_PWR = 1 采用:

 $VBAT(orVBAT \ RTC) = 3.3V + (BSENSE - 142) \cdot 0.0246V + STEMP \cdot 0.000297V$

BRN 模式下, TEMP PWR = TEMP BSEL 采用:

 $VBAT(orVBAT \ RTC) = 3.291V + (BSENSE - 142) \cdot 0.0255V + STEMP \cdot 0.000328V$

MSN 模式下,可通过置位 BCURR (I/O RAM 0x2704[3])位将 100μ A 负载加至所选电池(即 $TEMP_BSEL$ 位选定的电池)。通过在有或没有 BCURR 的情况下测量电池,可测得电池阻抗。BRN、LCD 和 SLP 模式下,无论 BCURR 是否置位,均不施加电池负载。

2.5.8 71M6xx3 VCC检测器

71M6xx3 监测其 VCC 引脚电压。71M6543 可通过向 71M6xx3 发送命令获取 VCC 引脚电压。71M6543 必 须从 71M6xx3 申请 *VSENSE[7:0]* 和 *STEMP[10:0]* 数值。关于利用从 71M6xx3 读取的 *VSENSE[7:0]* 和 *STEMP[10:0]* 数值计算 71M6xx3 VCC 引脚电压的公式,请参见 71M6xxx 数据资料。

关于如何从 71M6xx3 远端传感器读取 *VSENSE[7:0]*和 *STEMP[10:0]*的信息,请参见第 22 页第 2.2.8.3 节 71M6xx3 隔离传感器的控制。

2.5.9 UART和光接口

71M6543 提供两个异步接口:UART0 和 UART1。两个接口均可用于连接至 AMR 模块、用户接口等。

参见图 14, UART1 包括实现 IR/光接口。引脚 OPT_TX 设计可直接驱动外部 LED,用于通过光链路发送数据。引脚 OPT_RX 与 RX 引脚的门限相同,但是亦可用于检测来自光链路接收器的外部光电探测器输入,OPT_TX 和 OPT_RX 连接至专用 UART 端口(UART1)。

OPT_TX 和 OPT_RX 引脚可分别通过配置 *OPT_TXINV (I/O RAM 0x2456[0])*和 *OPT_RXINV (I/O RAM 0x2457[1])*翻转。此外,OPT_TX 输出支持 38K 调制,调制可用于 MSN 和 BRN 模式(见表 62)。 *OPT_TXMOD*位(*I/O RAM 0x2456[1]*)使能调制。占空比由 *OPT_FDC[1:0] (I/O RAM 0x2457[5:4])*控制,可选择 50%、25%、12.5%和 6.25%占空比。6.25%占空比意味着 OPT TX 在 6.25%周期内为低电平。T

无需 UART1 时,可选择将 OPT_TX 配置为 SEGDIO51。通过 OPT_TXE[1:0] (I/O RAM 0x2456[3:2])字段和 LCD_MAP[51] (I/O RAM 0x2405[0])配置。OPT_TXE[1:0]字段允许 MPU 选择将 VPULSE、WPULSE、SEGDIO51 或脉冲调制器通过 OPT_TX 引脚输出。同样,亦可选择将 OPT_RX 引脚配置为 SEGDIO55,其控制位为 OPT_RXDIS (I/O RAM 0x2457[2])和 LCD_MAP[55] (I/O RAM 0x2405[4])。

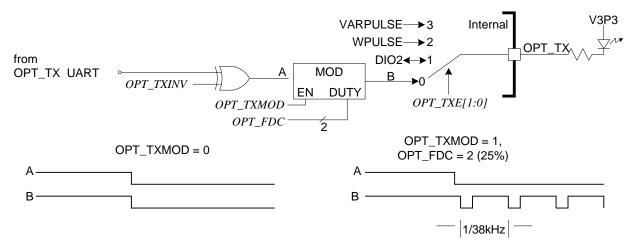


图 14. 光接口

DIO 模拟光 UART (第3个 UART)

如图 15 所示,71M6543 还可将 DIO5 设置成光驱动 UART。控制位 *OPT_BB* (*I/O RAM 0x2022[0]*)置位时,光端口由 DIO5 驱动,而原有 SEGDIO5 引脚由 UART1_TX 驱动。这种配置通常用于高速串口多于 2 个的应用,且允许光 UART 速率较慢的设计。

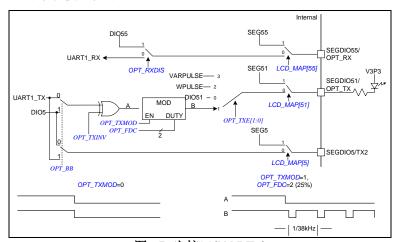


图 15. 光接口(UART1)

2.5.10 数字I/O和LCD段驱动器

2.5.10.1 通用信息

71M6543 大多数引脚支持 DIO/LCD 功能复用,每个 SEG/DIO 引脚可配置为 DIO 引脚或段(SEG)驱动器引脚。

复位或上电后,所有 DIO 引脚为 DIO 输入(SEGDIO0-15 除外,参见下面的注意事项),只有在 MPU 控制下进行相应配置才可用于其它功能。引脚功能可由 I/O RAM 寄存器 LCD_MAPn (0x2405 - 0x240B)配置。将 LCD_MAPn 中与引脚对应的位置 1,即可将引脚配置为 LCD;将 LCD_MAPn 置 0,将其配置为 DIO。



复位或上电后,引脚 SEGDIO0 至 SEGDIO15 初始为 DIO 输出,但由 $PORT_E = 0$ (I/O RAM 0x270C[5])禁用,以避免复位期间出现不希望的脉冲。配置引脚 SEGDIO0 至 SEGDIO15 后,MPU 必须通过置位 PORT E 使能这些引脚。

一旦引脚配置为 DIO,即可独立配置为输入或输出。对于 SEGDIO0 至 SEGDIO15,通过 SFR 寄存器 PO (SFR 0x80)、P1 (SFR 0x90)、P2 (SFR 0xA0)和 P3 (SFR 0xB0) 实现,如表 48 所示。

例:通过在 $LCD_MAP[15:8]$ 的第 4 位写 0,在 P3[4]和 P3[0]写 1,将 SEGDIO12 (表 48 中的引脚 32)配置为 DIO 输出引脚。通过在 $LCD_MAP[15:8]$ 的第 4 位写 1,将相同引脚配置为 LCD 驱动。显示信息写入 LCD_SEG12 的第 0 至第 5 位。

PB 引脚为专用数字输入,不属于 SEGDIO 系统。



CE 具有脉冲计数寄存器,每个脉冲计数器的中断输出在内部连接到脉冲中断逻辑。因此,产生脉冲中断不需要将脉冲信号连接到外部引脚,参见图 12 中的 No. 2 中断源。

I/O RAM 寄存器 DIO_{Rn} (I/O RAM 0x2009[2:0]至 0x200E[6:4]),用于独立配置引脚 SEGDIO2 至 SEGDIO11 (配置为 DIO 时)和 PB 的内部信号源。例如:中断或定时器控制($DIO_{RPB}[2:0]$, I/O RAM 0x2450[2:0],配置 PB 引脚)。这种方式下,即使 DIO 引脚配置为输出,亦可跟踪。表 48 列出了可利用 $DIO_{R2}[2:0]$ 至 $DIO_{R1}I[2:0]$ 和 $DIO_{RPB}[2:0]$ 分配的内部信号源。如果多个输入连接至同一源,它们之间与信号源的触发是逻辑或的关系。

选择用于 SEGDIOn 或 PB 引脚的资源 DIO_Rn[2:0]数值 0 无 1 保留 2 T0 (计数器 0 时钟) 3 T1 (计数器 1 时钟) 4 高优先级 I/O 中断(INT0) 5 低优先级 I/O 中断(INT1) 注: 资源只有 SEGDIO2 至 SEGDIO11 和 PB 引脚可选,参见表 49。

表 47. 通过 DIO_Rn[2:0]位的能够选择的资源



驱动LED、继电器线圈等时,DIO引脚应该<u>灌入</u>电流至GNDD (如图 16 中右侧所示),<u>不是</u>从 V3P3D源出电流(如图 16 中左侧所示)。这是由于将V3P3D连接至V3P3SYS或VBAT的内部开关 电阻造成的,参见第 139 页 6.4.6 节V3P3D开关。



必须避免在专用于唤醒功能的DIO引脚上灌入或输出电流,例如利用上拉或下拉电阻。违反这一规则将造成休眠或LCD模式下静态电流增大。

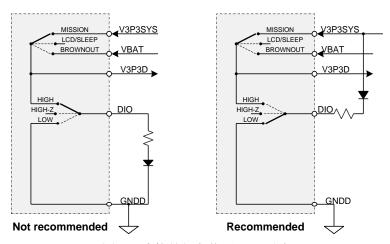


图 16. 连接外部负载至 DIO 引脚

2.5.10.2 复用DIO和SEG引脚

共有 51 个 DIO/LCD 复用引脚。这些引脚可分类如下:

39 个 DIO/LCD 复用引脚:

- o SEGDIO4...SEGDIO25 (22 个引脚)
- o SEGDIO9...SEGDIO35 (8 个引脚)
- o SEGDIO19...SEGDIO45 (6 个引脚)
- o SEGDIO44...SEGDIO54 (3 个引脚)

12个与其它功能共用的 DIO/LCD 复用引脚:

- o SEGDIO0/WPULSE, SEGDIO1/VPULSE (2 个引脚)
- o SEGDIO2/SDCK, SEGDIO3/SDATA (2 个引脚)
- o SEGDIO26/COM5, SEGDIO27/COM4 (2 个引脚)
- o SEGDIO36/SPI_CSZ...SEGDIO39/SPI_CKI (4 个引脚)
- o SEGDIO51/OPT_TX, SEGDIO55/OPT_RX (2 个引脚)

另外还提供 5 个 LCD 段(SEG)引脚。这些引脚可分类如下:

- 。 3 ↑ SEG 引脚与 ICE 接口共用(SEG48/E_RXTX、SEG49/E_TCLK、SEG50/E_RST
- 2个 SEG 引脚与测试复用器输出共用(SEG46/TMUX2OUT、SEG47/TMUXOUT)

因此,LCD 配置最小时,总共51个 DIO 引脚可用;DIO 配置最小时,总共56个 LCD 引脚可用。

	1X T). JL	ODIC	少 王	JLUL)IO I	7 3X 1/F	11/J P	H 17	加火	刀叩火	VA.				
SEGDIO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
引脚#	45	44	43	42	41	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29
配置:	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
0 = DIO, 1 = LCD		LCD	_MAP	[7:0]	(I/O R	4 <i>M</i> 0 <i>x</i>	240B))		LCD_	MAP[15:8] (I/O R	AM 0x	c240A)
CCC 粉把安方照	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SEG 数据寄存器		LCD	_SEC	30[5:0)]至 <i>L</i>	CD_S	EG15	5[5:0]	(I/O I	RAM (0x2410	0[5:0]	至 0x	241F	[5:0]	
DIO 数据寄存器	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
DIO 剱佑句仔裔		PO (S.	FR80))	P	1 (SF.	R 0x9	0)	P	2 (SF	R OxA	0)	Р.	3 (SF.	R OxB	0)
方向寄存器:	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7	4	5	6	7
0 = 输入, 1 = 输出	P	0 (SF.	R 0x8	0)	P	1 (SF.	R 0x9	0)	P	2 (SF	R OxA	0)	Р.	3 (SF	R OxB	0)
内部资源可配置			\ \	\ \	V		\ <u>\</u>	V	\ <u></u>	V	V					
(见表 47)	-	_	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	_	_	_	_

表 48. SEGDIO0 至 SEGDIO15 数据/方向寄存器及内部资源

SEGDIO16 至 SEGDIO31 的配置如表 49 所示,引脚 SEGDIO32 和 SEGDIO45 的配置如表 50 所示。引脚 SEGDIO51 和 SEGDIO55 的配置如表 51 所示。

表 49.5	SEGDIO16	至 SEGDIO31	数据/方向寄存器
--------	----------	------------	----------

SEGDIO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
引脚#	28	27	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	11	10	9	8
配置:	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
0 = DIO, 1 = LCD		LCD_	MAP	23:16] (I/O R	AM Ox	2409)			LCD	_MAP	[31:24]] (I/O F	RAM Ox	(2408)	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SEG 数据寄存器					LCD	_SEGI	DIO16	[5:0] 至	E LCD	_SEG	DIO31	[5:0]				
						(I/O R	AM 0x2	2420[5:	0]至(0x242F	7[5:0])					
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIO 数据寄存器					LC	D_SE	GDIO1	6[0] 至	LCD	_SEG	DIO31	[0]				
						(1/01	RAM 0.	x2420[(0] 至 (0x2421	F[0])					
方向寄存器:	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0 = 输入, 1 = 输出					LC	D_SE	GDIO1	[6[1] 至	LCD	_SEGI	D IO3 1	[1]				
リー・棚八、「=棚山						(I/O)	RAM 0.	x2420[.	1] 至 (0x2421	F[1])					

表 50. SEGDIO32 至 SEGDIO45 数据/方向寄存器

SEGDIO	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
引脚#	7	6	5	4	3	2	1	100	99	98	97	96	95	94
配置:	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5
0 = DIO, 1 = LCD				_	AP[39: . 1 0x240	•					_	AP[45: 0x2406[-	
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
SEG 数据寄存器				LCL	_SEG	DIO32 ₁	[5:0]	Ē <i>LCD</i>	_SEG	DIO45	[5:0]			
					(I/O R	AM 0x2	2430[5.	0]至()x243L) [5:0])				
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
DIO 数据寄存器				LC	_			E LCD [0] 至 (•	[0]			
-	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
方向寄存器: 0 = 输入, 1 = 输出	LCD_SEGDIO32[1] 至 LCD_SEGDIO45[1] (I/O RAM 0x2430[1] 至 0x243D[1])													

表 51. SEGDIO51 至 SEGDIO55 数据/方向寄存器

SEGDIO	51	52	53	54	55			
引脚#	53	52	51	47	46	-	-	ı
配置:	3	4	5	6	7	-	_	-
0 = DIO, 1 = LCD				_	MAP[55 AM 0x2	•		
	51	52	53	54	55	_	_	-
SEG 数据寄存器	LC	_				CD_SEG E 0x244	_	5:0]
DIO 数据寄存器	51	52	53	54	55	_	_	_

	LCD_SEGDIO51[0] 至 LCD_SEGDIO55[0] (I/O RAM 0x2443[0] 至 0x2447[0])								
全白宏有 盟	51	52	53	54	55	_	_	_	
方向寄存器: 0=输入,1=输出	LCD_SEGDIO51[1] 至 LCD_SEGDIO55[1] (I/O RAM 0x2443[1] 至 0x2447[1])								

2.5.10.3 LCD驱动器

LCD 驱动器由多达 6 个 COM (COM0 至 COM5)和多达 56 个段驱动组成。LCD 接口非常灵活,可驱动 7 段数字、14 段数字或指示符号。

倍压电路和对比度调节 DAC 从 VBAT 或 V3P3SYS 产生 VLCD 电压,电压值取决于 V3P3SYS 电压。倍压电路可驱动 500Ω 负载,所产生的最大电压比两倍供电电压低 1V,用于 LCD 供电。倍压电路和 DAC 采用经过微调的低功耗基准供电。

产生 VLCD 的配置由 I/O RAM 字段 *LCD_VMODE[1:0] (I/O RAM 0x2401[7:6])*控制,解码为 *LCD_EXT、LDAC_E*和 LCD_BSTE。表 **52** 中列出了详细的 *LCD_VMODE[1:0]*配置。

丰	52	ICL	VM	ODE	配署

LCD_VMODE[1:0]	LCD_EXT	LDAC_E	LCD_BSTE	说明
11	1	0	0	连接至 VLCD 引脚的外部 VLCD。
10	0	1	1	使能 LCD 升压,最大 VLCD 引脚电压为 2*V3P3L-1。 VLCD = max(2*V3P3L-1, 2.65(1+ <i>LCD_DAC[4:0]/</i> 31)
01	0	1	()	禁用 LCD 升压时,最大 VLCD 电压为 V3P3L。 VLCD = max(V3P3L, 2.65(1+ <i>LCD_DAC[4:0]/</i> 31)
00	0	0	()	VLCD=V3P3L,禁用 LCD DAC 和 LCD 升压。LCD 模式下,该设置获得最小电池电流。

注:

1. LCD_EXT、LDAC_E 和 LCD_BSTE 为 71M6543 内部信号,解码自 *LCD_VMODE[1:0]*控制字段设置(*I/O RAM 0x2401[7:6]*)。这些解码信号有效时,具有以上说明栏的影响,总结如下:

LCD EXT:置位时, VLCD 引脚接收外部供电电压

LDAC_E:置位时,使能 LCD DAC

LCD BSTE:置位时,使能 LCD 升压电路

2. V3P3L 为内部电源,源自 VBAT 引脚或 V3P3SYS 引脚供电,取决于 V3P3SYS 引脚电压。 V3P3SYS 引脚下降至低于 3.0 VDC 时,71M6543 切换至 BRN 模式,V3P3L 从 VBAT 引脚供电; 否则,MSN 模式下,V3P3L 从 V3P3SYS 引脚供电。



使用 VLCD 升压电路时,须谨慎设置 $LCD_DAC[4:0]$ (I/O RAM 0x240D[4:0]),确保不超过 LCD 制造商推荐的工作电压指标。

倍压电路在所有 LCD 模式下均有效,包括 $LCD_BSTE = 1$ 时的 LCD 模式。如果禁用升压电路,LCD 系统直接工作于 VBAT,可降低 LCD 模式下的耗流。

LCD DAC 采用低功耗基准,在 VBAT 和倍压限制的范围内产生 VLCD 电压: 2.65 VDC + 2.65 * *LCD_DAC[4:0]*/31。两个熔丝字节提高了 LCD_DAC 精度,LCDADJ12 和 LCDADJ0 分别表示 DAC 设置为 12 和 0 条件下的实际 VLCD 输出电压。

LCD_BAT 位(I/O RAM 0x2402[7])可以设定 LCD 系统在任何模式下均使用电池供电,这样对于外部电源为 LCD 系统供电的情况比较实用,在 VBAT (而非 VLCD)连接外部电源带来的好处是可以保持 LCD DAC 有效。

如果 LCD EXT = 1, VLCD 必须由外部电源提供。这种情况下, LCD DAC 无效。

LCD 系统的每个 SEG 引脚可驱动多达 6 段显示器。如果显示器配置成 6 个背板,复用 6 个通道可以大大减少所需的 SEG 引脚数,进而增加 DIO 引脚可用数量。关于不同 LCD 驱动模式选择的信息,请参见 $LCD_MODE[2:0]$ 字段(I/O RAM 0x2400[6:4])设置(表 53)。如果选择 5 状态复用模式,SEGDIO27 则转换为 COM4。如果选择 6 状态复用模式,SEGDIO26 转换为 COM5。这种转换优先级高于 SEGDIO26 和 SEGDIO27 的 SEG/DIO 映射。此外,与 $LCD_MODE[2:0]$ 无关,如果 $LCD_ALLCOM = 1$ (I/O I/O I/

LCD_ON (*I/O RAM 0x240C[0]*)和 *LCD_BLANK* (*I/O RAM 0x240C[1]*)位是控制 LCD 显示全灭或全亮的便捷方式。任何一位都不影响 *LCDSEG_DIO[] 寄*存器中储存的 LCD 数据内容。而 *LCD_RST* (*I/O RAM 0x240C[2]*)则可将全部 LCD 数据清 0。*LCD RST* 仅影响配置为 LCD 的引脚。



设置 LCD 频率,使其能够在所需温度范围内提供满意的 LCD 视觉效果的同时保持在最低值,有助于在一定程度降低功耗。

表 53 列出了控制 LCD 接口工作的全部 I/O RAM 寄存器。

表 53. LCD 配置

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明		
LCD_ALLCOM	2400[3]	0	_	R/W	将全部 6 个 SE LCD_MAP 为 0 的	G/COM 引脚配置为 CC引脚。)M。不影响
LCD_BAT	2402[7]	0	_	R/W	在所有模式下将 L	CD 电源连接至 VBAT。	
LCD_E	2400[7]	0	_	R/W		禁用时,VLC2、VLC1 和 P 位为 1),类似于 COM	
LCD_ON LCD_BLANK	240C[0] 240C[1]	0	_ _	R/W R/W	似地, <i>LCD_BLAN</i>	F全部 LCD 段,不影响 LC K= 1 关闭全部 LCD 段, 置位,则打开所有 LCD 段	不影响 LCD
LCD_RST	240C[2]	0	_	R/W	清零所有 LCD 数 器的 SEGDIO 引服	据位。这些位影响被配置》 即。	为 LCD 驱动
LCD_DAC[4:0]	240D[4:0]	0	_	R/W	出范围为 2.56 VD VLCD = 2.6 所以,DAC 的 LS 限于 V3P3SYS、	D 对比度 DAC,调节 VLC C 至 5.3 VDC。VLCD 电 55 + 2.65 * <i>LCD_DAC[4:0]</i> 5B 为 85.5mV。最大 DAC VBAT,以及 <i>LCD_BSTE</i> 長	玉为: // 31 3. 输出电压受 是否置位。
LCD_CLK[1:0]	2400[1:0]	0	_	R/W	设置 LCD 时钟频率(1/T),参见图 17 关于 T 的定义。. 注意: fw = 32768 Hz 00-fw/2^9, 01-fw/2^8, 10-fw/2^7, 11-fw/2^6		
					LCD 偏压和复用模		
LCD_MODE[2:0]	2400[6:4]	0	_	R/W	000 001 010 011 100	输出 4COM, 1/3 偏压 3COM, 1/3 偏压 2COM, ½偏压 3COM, ½偏压 静态显示	
					101 110	5COM,1/3 偏压 6COM,1/3 偏压	
					该寄存器制定如何	产生 VLCD。	
					LCD_VMODE	说明	
ICD VMODELLO	0404[7:0]	00	00	D AA	11	外部 VLCD	10
LCD_VMODE[1:0]	2401[7:6]	00	00	R/W	10	使能 LCD 升压和 LCD D 使能 LCD DAC	AC
					00	便能 LCD DAC 无升压和 DAC VLCD = VBAT 或 V3P3S	SYS

可以驱动静态、 ½偏压和 1/3 偏压模式下的 LCD。图 17 定义了 COM 波形。注意,特定模式下不使用的 COM 引脚保持"段关闭"状态,而非 GND、VCC 或高阻。

段驱动器 SEGDIO22 和 SEGDIO23 可配置为以 0.5Hz 或 1Hz 闪烁。闪烁频率由 *LCD_Y (I/O RAM 0x2400[2])*控制。连接至这些驱动引脚的段可最多有 6 个。I/O RAM 字段 *LCD_BLKMAP22[5:0] (I/O RAM 0x2402[5:0])*和 *LCD_BLKMAP23[5:0] (I/O RAM 0x2401[5:0])*设定哪些像素需要闪烁。*LCD_BLKMAP22[5:0]*和 *LCD_BLKMAP23[5:0]*为非易失。

可利用 $LCD_DAC[4:0]$ 字段(I/O RAM 0x240D[4:0])对 LCD 偏压进行温度补偿,偏压在 1.4 V 至 3.3 V (MSN 模式下为 V3P3SYS,BRN 和 LCD 模式下为 VBAT)范围内调节。 $LCD_DAC[4:0]$ 字段设为 000 时,DAC 被 旁路并关断,用于减小 LCD 模式下的电流。

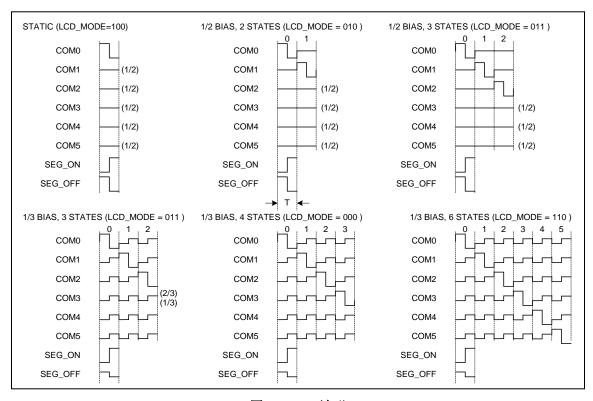


图 17. LCD 波形

SEG46 至 SEG50 不可配置为 DIO 引脚。这些引脚的显示数据写入 I/O RAM 寄存器 *LCD_SEG46[5:0]*至 *LCD_SEG50[5:0]* (见表 54)。

SEGDIO	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
引脚#	93	92	58	57	56	53	52	51	47	46
配置		总为	LCD	引脚			参见	乜 2.5.1	0.2	
SEG 数据寄存器	LCD_SEGDIO46[5:0] (VO RAM 0x243E[5:0]	LCD_SEGDIO47[5:0] (I/O RAM 0x243F[5:0])	LCD_SEGDIO48[5:0] (I/O RAM 0x2440[5:0]	LCD_SEGDIO49[5:0] (I/O RAM 0x2441[5:0])	LCD_SEGD1050[5:0] (I/O RAM 0x2442[5:0])	LCD_SEGDIO51[5:0] (I/O RAM 0x2443[5:0])	LCD_SEGDIO52[5:0] (I/O RAM 0x2444[5:0])	LCD_SEGDIO53[5:0] (I/O RAM 0x2445[5:0])	LCD_SEGD1054[5:0] (I/O RAM 0x2446[5:0])	LCD_SEGD1055[5:0] (I/O RAM 0x2447[5:0])

表 54. SEGDIO46 至 SEGDIO55 LCD 数据寄存器

LCD_MAP[47:46] (*I/O RAM 0x2406[7:6]*)位用于确定 SEG46 和 SEG47 为 SEG 引脚或复用功能(见图 43 中的引脚 93 和 92)。如果 *LCD_MAP[47:46]*位为 1,表示引脚配置为 SEG 引脚;如果 *LCD_MAP[47:46]*位为 0,表示引脚配置为其复用功能(分别为 TMUX2OUT 和 TMUXOUT)。

例如,如果 *LCD_MAP[46]* = 1,那么引脚 93 (TMUX2OUT/SEG46)配置为 SEG46;如果 *LCD_MAP[46]* = 0,引脚 93 配置为 TMUX2OUT。

如果 ICE_E 引脚(引脚 59)驱动为高电平,与 ICE 接口功能共用的 SEG 引脚(见图 43 中的引脚 56 至 58)强制为其复用 ICE 接口功能(即 E_RXTX、E_TCLK 和 E_RST),这种情况下, $LCD_MAP[50:48]$ (I/O RAM 0x2405[2:0])位为 "无关"项。如果 ICE_E 引脚驱动为低电平, $LCD_MAP[50:48]$ 位必须写 1,以将这些引脚配置为 SEG 引脚。如果 ICE_E 引脚为低电平,且 $LCD_MAP[50:48]$ 为 0,那么这些引脚将被内部上拉。

2.5.11 EEPROM接口

71M6543 支持硬件 2 线或 3 线(μ-wire)型 EEPROM 接口。接口使用 *EECTRL (SFR 0x9F)*和 *EEDATA (SFR 0x9E)*寄存器通信。

2.5.11.1 2线EEPROM接口

71M6543 提供 2 线串口与外部 EEPROM 器件通信。通过配置 *DIO_EEX[1:0]* = 01 (*I/O RAM 0x2456[7:6]*)启用 SEGDIO2 (SDCK)和 SEGDIO3 (SDATA)引脚的通信接口功能。MPU 通过 SFR 寄存器 *EEDATA* 和 *EECTRL* 与接口通信。如果 MPU 希望写入 EEPROM 一个字节数据,应将数据放入 *EEDATA*,然后写发送命令至 *EECTRL*。这将初始化发送操作,BUSY 位变低时结束。BUSY 变低时,触发 INT5。MPU 然后可检查 *RX_ACK* 位,查看 EEPROM 是否应答。

读字节时,写接收命令至 *EECTRL*,然后等待 *BUSY* 位变低。完成之后,接收数据位于 *EEDATA*。串行发送和接收时钟在每次传输时为 100kHz,然后保持为高电平状态,直到下次传输开始。选择双引脚接口时, *EECTRL* 位如表 55 所示。

状态位	名称	读/写	复位 状态	极性	说明					
7	ERROR	R	0	正	接收到非法命	令后为 1。				
6	BUSY	R	0	正	串行数据总线	忙时为 1。				
5	RX_ACK	R	1	正	1表示 EEPR	OM 发送了 ACK 位。				
4	TX_ACK	R	1	正	1 表示已向 EE	EPROM 发送 ACK 位。				
					CMD[3:0]	操作				
						0000	无操作命令。停止 I ² C 时钟(SDCK)。 如果不发送,SDCK 保持触发状态。			
					0010	从 EEPROM 接收一个字节,然后发 送 ACK。				
3:0	CMD[3:0]	W	0000	正	0011	发送一个字节至 EEPROM。				
					0101	发起一个 STOP 序列。				
					0110	从 EEPROM 接收最后字节,不发送				
						ACK.				
									1001	发起一个 START 序列。
					其它	无操作,置位 ERROR 位。				

表 55. 2 线接口对应的 EECTRL 位



EEPROM 接口也可通过软件直接控制 DIO2 和 DIO3 实现,即软件模拟 I²C 接口。DIO 的方向可由输入更改为输出,可利用单次写操作写输出值,从而避免冲突(见表 14 端口寄存器(SEGDIO0-15)); 串行 SDATA 的防冲突功能无需电阻。

2.5.11.2 带有独立数据引脚的 3 线(μ-wire) EEPROM接口

500kHz 3 线接口采用 SDATA、SDCK,DIO 引脚用作 CS。接口通过 *DIO_EEX[1:0]* = 10 选择。选择 3 线接口时,*EECTRL* 如表 56 所示。写 *EECTRL* 时,来自 *EEDATA* 的 8 位数据写入 EEPROM 或从 EEPROM 读取,取决于 *EECTRL*。

2.5.11.3 带有独立DI/DO引脚的 3 线(μ-wire/SPI) EEPROM接口

如果 $DIO_EEX[1:0]$ = 11,除 DI 和 DO 为独立引脚外,71M6543 的 3 线接口同上。这种情况下,SEGDIO3 变为 DO,SEGDIO8 变为 DI。除了输出数据出现在 DO 引脚以及全部输入数据出现在 DI 之外,时序与 $DIO_EEX[1:0]$ = 10 时相同。该模式下,忽略 DI,在 DO 接收数据。该模式兼容于 SPI 模式 0、0 和 1、1,数据在时钟下降沿移出,在时钟上升沿写入。

控制位	名称	读/写	说明
7	WFR	W	等待就绪。如果该位置位,BUSY下降沿将被延迟,直到在数据线出现上升沿。该位可用于写命令的最后字节期间,在 EEPROM 结束其内部写序列后产生 INT5 中断。如果 Hi-Z=0,该位被忽略。
6	BUSY	R	串行数据总线忙时有效。BUSY 位下降时,产生 INT5 中断。
5	HiZ	W	表示 SD 信号在最后一个 SDCK 上升沿后立即悬空或置为高阻。
4	RD	W	表示 EEDATA (SFR 0x9E)由来自 EEPROM 的数据填充。
3:0	CNT[3:0]	W	设定要发送的时钟数量。允许值为 0~8。如果 RD=1,从高到低的顺序读取 CNT 位数据,并以右对齐存入 <i>EEDATA</i> 寄存器。如果 RD=0, <i>EEDATA</i> 寄存器数据被从高到低的顺序发送 CNT 位数据至 EEPROM 接口。如果 <i>CNT[3:0]</i> 为 0,SDATA 将处于 <i>HiZ</i> 状态。

表 56.3 线接口对应的 EECTRL 位

图 18 至图 22 的时序图说明了 3 线 EEPROM 接口的操作。写 *EECTRL* 寄存器时,意味着开始执行所有命令。首先从连接至 CS 的 DIO 引脚上升沿开始;然后通过 *EECTRL* 和 *EEDATA* 发送多于 8 位或少于 8 位的命令,如图 18 至图 22 所示。

传输结束后,必须将 CS 拉低。在读操作结束时,EEPROM 接口正在驱动 SDATA,但是当 CS 变低时将转换为 Hi-Z (高阻)。MPU 程序应立即发出一个写命令,CNT=0,HiZ=0,接管控制 SDATA,强制其为低阻状态。

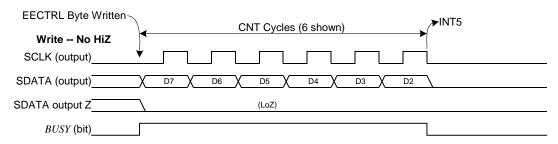


图 18.3 线接口: 写命令, HiZ=0

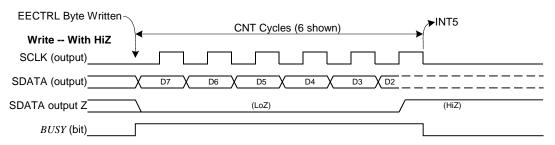


图 19.3 线接口: 写命令, HiZ=1

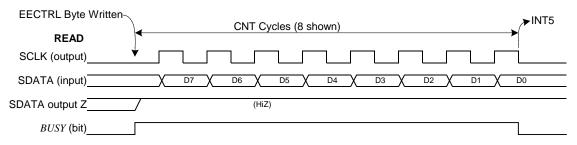


图 20.3 线接口: 读命令

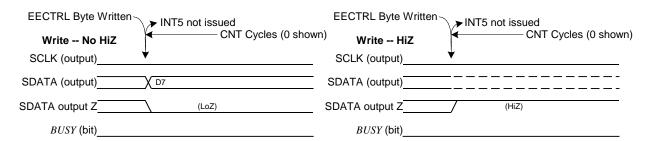


图 21.3 线接口: 写命令, CNT=0

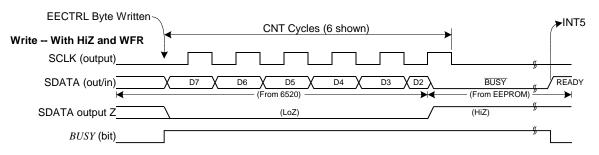


图 22.3 线接口: 写命令, HiZ=1, WFR=1

2.5.12 SPI从机端口

从机 SPI 接口直接与 MPU 数据总线通信,能够读、写数据 RAM 和配置 RAM (I/O RAM)地址。也能够发送命令至 MPU。连接从机接口的端口包括:SPI_CSZ、SPI_CKI、SPI_DI 和 SPI_DO 引脚。这些引脚与 DIO/LCD 段驱动器引脚 SEGDIO36 至 SEGDIO39 组合复用(引脚 3, 2, 1 和 100)。

此外,SPI 接口允许读取 FLASH 并对其编程。为便于 FLASH 编程,芯片需要重新上电或复位一次,使 SPI 引脚复位为默认的 PSI 模式。通过清除 SPI_E 位(I/O RAM 0x270C[4])直接禁用 SPI 端口。

SPI 接口的应用包括:

- 1) 外部主机从 CE 地址读取数据,获取表计信息。这可用于 71M6543 作为智能前端的应用。由于地址为 16 位格式,所以可访问任何类型的 XRAM 数据:CE、MPU、I/O RAM,但不能访问 SFR 或 80515 内 部寄存器组。
- 2) 可通过 SPI 接口建立通信链路:通过写 MPU 存储器,外部主机可启动和控制 71M6543 MPU 的进程。写 CE 或 MPU 通常产生一个中断,用来通知 MPU 读取和处理外部主机写入的字节功能。亦可在不产生中断的情况下由外部主机写入数据。
- 3) 外部 DSP 可访问 ADC 产生的前端数据,这种模式将 71M6543 作为模拟前端(AFE)。
- 4) 由外部主机对 FLASH 编程(SPI FLASH 模式)。

SPI 传输

典型的 SPI 传输如下。SPI_CSZ 为高电平时,端口保持在初始化/复位状态。该状态期间,SPI_DO 保持在高阻状态,SPI_CLK 和 SPI_DI 上的所有跳变被忽略。SPI_CSZ 为低电平时,端口在 SPI_CLK 的第一个上升沿开始传输。如表 57 所示,一次传输包括可选的 16 位地址、8 位命令、8 位状态字节,后边跟一个或多个字节的数据。SPI_CSZ 为高时,传输结束。有些传输可能仅包含命令。

 SPI_CSZ 为高时,非 x0000000 形式的 SPI 命令字节将更新 SPI_CMD (SFR_0xFD)寄存器,同时触发中断。通信为单字节的情况例外。这种情况下, SPI_CMD 字节总是更新并请求中断。 SPI_CSZ 为高电平时,不清除 SPI_CMD 。

SPI 端口支持高达 10Mb/s 的数据传输。串行读、写操作需要至少 8 个时钟/字节,进而 SPI 对 RAM 的访问速度在 1.25MHz 以下,确保 SPI 总是能够访问 DRAM。

字段名称	必需	大小 (字节)	说明
地址	是,单字节通信 除外	2	16 位地址。如果发送一简单 SPI 命令,则无需地址字段。
命令	是	1	8 位命令。该字节可作为 MPU 的控制命令。多字节通信中, MSB 为读/写位。除非通信为多字节,且 <i>SPI_CMD</i> 准确为 0x80 或 0x00, <i>SPI_CMD</i> 寄存器更新,并请求 SPI 中断。否则, <i>SPI_CMD</i> 寄存器保持不变,并且不请求中断。
状态	是,如果通讯包 括数据	1	8 位状态字段,表示之前的通信状态,该字节亦可用于 MPU 存储器映射为 SPI_STAT (I/O RAM 0x2708)寄存器。内容请参见表59。
数据	是,如果通讯包 括数据	1 或多	读或写数据。每个新字节的地址自动递增。

表 57. SPI 操作字段

每次 SPI 通信输出 SPI STAT 字节,并指示前一通信的奇偶校验和错误状态。潜在故障源有:

- 71M6543 没有就绪。
- 通信没有在字节边界结束。

SPI 安全模式

有时候希望防止 SPI 接口对任意 RAM 地址进行写操作,以免干扰 MPU 和 CE 工作,尤其是在 AFE 应用中。出于这一原因,提供了 SPI 安全模式。SPI 安全模式下,只有地址 0x400 至 0x40F 的 16 个字节 SPI 可进行写操作。如果 SPI 主机需要写其它地址,可以利用 SPI_CMD 寄存器从 MPU 请求写操作。SPI 安全模式由 SPI_SAFE 位(I/O RAM 0x270C[3])位使能。

单字节通信

如果为单字节通信,该字节解析为 SPI_CMD。对于任何命令,单字节通信总是更新 SPI_CMD 寄存器,从而生成 SPI 中断。

多字节通信

如图 23 所示,多字节操作包括 16 位地址字段、8 位 CMD、状态字节和数据字节序列。多字节通信为三或四字节格式。

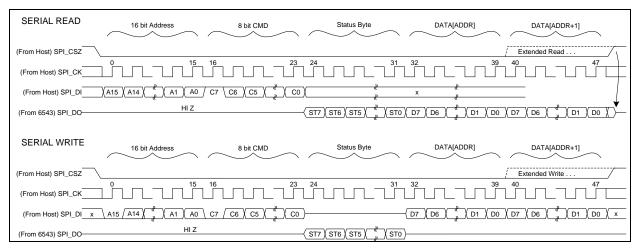


图 23. SPI 从机端口—典型的多字节读、写操作

表	58.	SPI	命令	旪	序
~	•••	• •	HH 4	гυ.	, ,

命令时序	说明
ADDR 1xxx xxxx STATUS Byte0 ByteN	从 ADDR 开始读取数据。ADDR 自动递增,直到 SPI_CSZ 为高;完成后, SPI_CMD (SFR 0xFD)更新至 1xxx xxxx,产生 SPI 中断。命令字节为 1000 0000 时例外。这种情况下,不产生 MPU 中断,不更新 SPI_CMD。
0xxx xxxx ADDR Byte0 ByteN	从 ADDR 开始写数据。ADDR 自动递增,直到 SPI_CSZ 为高;完成后, <i>SPI_CMD</i> 更新至 0xxx xxxx,产生 SPI 中断。命令字节为 0000 0000 时例 外。这种情况下,不产生 MPU 中断,不更新 <i>SPI_CMD</i> 。

表 59. SPI 寄存器

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明
EX_SPI	2701[7]	0	0	R/W	SPI中断使能位。
SPI_CMD	SFR FD[7:0]	ı	ı	R	SPI 命令,来自总线主控制器的8位命令。
SPI_E	270C[4]	1	1	R/W	SPI 端口使能位,使能引脚 SEGDIO36 至 SEGDIO39的 SPI接口。
IE_SPI	SFR F8[7]	0	0	R/W	SPI 中断标识,由硬件置位,通过写 0 清除。
SPI_SAFE	270C[3]	0	0	R/W	SPI 安全模式使能位。置位时,将 SPI 写操作限制在 SPI_CMD 及 DRAM 中的 16 字节区域。
SPI_STAT	2708[7:0]	0	0	R	SPI_STAT 含有前一 SPI 通讯的状态结果。 第7位:就绪错误:71M6543 未准备好按照前一命令读或写。 第6位:读数据奇偶性:该位是前一命令从71M6543 读取的全部字节的奇偶校验。不包括 SPI_STAT 字 节。

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明
					第 5 位: 写数据奇偶性: 该位时前一命令写入至 71M6543 的全部字节的总奇偶校验。它包括 CMD 和 ADDR 字节。
					第 4:2 位:字节数的最低 3 位。不包括 ADDR 和 CMD 字节。1、2 和 3 字节指令返回 111。
					第 1 位:SPIFLASH 模式:TEST 引脚为零时,该位为零。
					第 0 位:SPIFLASH 模式就绪:用于 SPIFLASH 模式。 表示 FLASH 已准备好接收另一条写指令。

SPI 闪存模式(SFM)

常规模式,SPI 从器件接口不能读或写 FLASH。然而,71M6543 支持 SPI FLASH 模式(SFM),方便 FLASH 的初始编程。当71M6543 处于该模式时,SPI 接口可擦除、读、写 FLASH。该模式下,不可访问 其它存储器,例如 XRAM 和 I/O RAM。为防止 FLASH 被错误地更改,需要特殊条件和操作才能激活 SFM 模式。

SFM 模式下,71M6543 支持对 FLASH 的 n 字节读取和双字节写入。关于读、写命令的格式,请参见第69页的 SPI 通信说明。由于 FLASH 写操作总是基于双字节字,所以初始地址必须为偶数。在写完奇数字节后,数据更新至16位 FLASH 总线。

71M6543G/GH 工作于 SFM 时,采用 SPI 单字节传输写 *FL_BANK[1:0]* (*SFR 0xB6[1:0]*)。SPI 单字节传输 期间,*SPI_CMD[1:0]*将忽略 *FL_BANK[1:0]* (*SFR 0xB6[1:0]*)的内容,允许在 SFM 模式下访问整个 128 KB 闪存。

SFM 模式下,MPU 暂停。由于这一原因,以上 SPI 通信部分介绍的中断特性不适合 SFM 模式。71M6543 只有被 WD 定时器或 RESET 引脚复位,才能退出 SFM 模式。

启动 SFM

开启 SFM 之前,必须满足以下条件:

- ICE E = 1。禁用看门狗,同时为防止无意篡改 FLASH 增加了另一层保护。
- 外部电源(V3P3SYS、V3P3A)处于适当电平(> 3.0 VDC)。
- *PREBOOT* = 0 (SFR 0xB2[7]), SECURE (SFR 0xB2[6])功能有效。
- SECURE = 0。该 I/O RAM 寄存器指示 SPI 加密模式被禁止。如果 SECURE 位 = 1 (在 SPI 加密模式下不允许读取 FLASH),操作被限制为 SFM 整体擦除模式。
- $FLSH_UNLOCK[3:0] = 0010 (I/O RAM 0x2702[7:4])$.

I/O RAM 寄存器 SFMM (I/O RAM 0x2080)和 SFMS (I/O RAM 0x2081)用于激活 SFM。需顺序写 SFMM 和 SFMS 才能激活 SFM。顺序写过程可以防止 MPU 意外进入 SFM。开启 SFM 的顺序为:

- 首先,写 SFMM (I/O RAM 0x2080)寄存器。写入该寄存器的值定义 SFM 模式。
 - o 0xD1:整体擦除模式。进入 SFM 时,激活 FLASH 整体擦除循环。
 - o 0x2E:FLASH 读回模式。进入 SFM 的目的是为了 FLASH 读回。不阻止 FLASH 写操作,由用户保证只写之前未被写的位置。SPI 加密模式被置位时,该模式不可用。
 - o 如果向 SFMM 寄存器写入其它任何值,均不会激活 SFM。
- 随后,写 0x96 至 SFMS (I/O RAM 0x2081)寄存器。如果之前对 SFMM 的写操作满足要求,该动作将激活 SFM。向该寄存器写入其它任何值都不会激活 SFM。此外,对该寄存器的任何写操作都自动将之前写入 SFMM 寄存器的值复位为 0。

SFM 详细介绍

进入 SFM 时,发生以下事件:

- 禁用 CE。
- MPU 暂停。MPU 一旦暂停,只能通过复位重新启动。复位可通过 RESET 引脚、看门狗复位或重新上电 (VBAT 引脚上无电池)完成。
- 当 MPU 处于 FLASH 写操作或擦除期间, FLASH 控制逻辑被复位。
- 如果在 *SFMM* 寄存器 *I/O RAM 0x2080* (见上文"启动 SFM")已经写入 0xD1,执行 FLASH 整体擦除。 *SECURE* 位(*SFR 0xB2[6]*)在该循环及所有整体擦除循环结束时被清除。
- 所有 SPI 读、写操作都针对 FLASH 而非 XRAM 空间。

通过对任意地址执行 4 字节 SPI 写操作并检查状态字段,SPI 主机可获取循环访问 FLASH 的状态。

SFM 模式下,所有 SPI 写操作必须为 6 字节写操作通信格式,将两个字节写入偶数地址。写操作必须含有 0xx00 形式的命令字节,这种形式的命令字节不会创建 MPU 中断。写操作时禁用自动递增。

SPI 读操作可使用自动递增,并且访问单字节。SFM 读操作中,命令字节必须总为 0x80 形式。

SFM 模式下的 SPI 命令

SFM 模式下,由于 MPU 暂停,所以不产生中断。命令的格式在第 69 页的 SPI 通信部分。

2.5.13 硬件看门狗定时器

71M6543 中包括一个独立、可靠、固定 1.5 秒溢出时间的看门狗定时器(WDT)。它利用 RTC 晶振作为时基,MPU 固件必须每 1.5 秒内刷新一次(喂狗)。超过刷新时间,WDT 溢出,器件复位。看门狗复位与 RESET 引脚被拉高复位一样(关于 RESET 和唤醒之后的 I/O RAM 位状态的完整清单,请参见第 5.2 节 I/O RAM 说明。WDT 溢出之后,经过 100 个 CK32 周期(即 125 ms),MPU 才能够开始从程序地址 0x0000 运行。

内部信号 WAKE=0 时,看门狗定时器也复位(参见第 3.4 节唤醒操作)。ICE_E 引脚上拉为高电平时,禁用WDT。

详情请参见第 3.3.4 节看门狗定时器(WDT)复位。

2.5.14 测试端口(TMUXOUT和TMUX2OUT引脚)

TMUXOUT 和 TMUX2OUT 是两个独立的多功能测试引脚,用户固件可以选择输出内部模拟或数字信号。 这些引脚与 SEG47 和 SEG46 功能复用。作为测试引脚,*LCD_MAP[46] (I/O RAM 0x2406[6])*和 *LCD MAP[47] (I/O RAM 0x2406[7])*必须为 0。

可选择表 61 中所列数字或模拟信号之一在 TMUXOUT 引脚输出。复用器功能由 I/O RAM 寄存器 TMUX[4:0] (I/O RAM 0x2502[4:0])控制,如表 60 所示。

可选择表 61 中所列数字或模拟信号之一在 TMUX2OUT 引脚输出。复用器功能由 I/O RAM 寄存器 TMUX2[4:0] (I/O RAM 0x2503[4:0])控制,如表 60 所示。

TMUX 和 TMUX2 I/O RAM 为非易失存储器,其内容由电池保持,复位时不会丢失。

TMUXOUT 和 TMUX2OUT 引脚可用于生产测试期间的诊断。RTC 1 秒信号输出可用于校准晶振。RTC 4 秒输出为 RTC 校准提供更高的精度。

TMUX[5:0] 信号名称 RTCLK 32.768kHz 时钟波形。 MPU 固件"喂狗"指示。通过监测确定看门狗定时器的空闲时 WD RST 9 Α CKMPU MPU 时钟—见表 8。 表示 V3P3A 引脚电压≥ 3.0V。预计 V3P3A 和 V3P3SYS 引脚在 D V3AOK bit PCB 板级连接在一起。71M6543 仅监测 V3P3A 引脚电压。 表示 V3P3A 引脚电压≥ 2.8V。预计 V3P3A 和 V3P3SYS 引脚在 Ε V3OK bit PCB 板级连接在一起。71M654x 仅监测 V3P3A 引脚电压。 MUX_SYNC 内部复用帧 SYNC 信号。请参见图 4 和图 5。 1B 1C CE_BUSY interrupt 参见第 25 页第 2.3.3 节和第 46 页图 12。 CE_XFER interrupt 1D 1F RTM output from CE 参见第 26 页第 2.3.5 节。

表 60. TMUX[4:0]选择

未列出的 TMUX[5:0]值均为保留。

表 61. TMUX2[4:0] 选择

TMUX2[4:0]	信号名称	说明					
0	WD_OVF	看门狗定时器溢出指示。					
1	PULSE_1S	占空比为 25%的 1 秒脉冲。该信号可用于测量 RTC 相对于理想 1 秒间隔的偏差。应对多个周期的测试进行平均,滤除抖动。					
2	PULSE_4S	占空比为 25%的 4 秒脉冲。该信号可用于测量 RTC 相对于理想 4 秒间隔的偏差。应对多个周期的测试进行平均,滤除抖动。4 秒脉冲比 1 秒脉冲测量的精度更高。					
3	RTCLK	32.768kHz 时钟波形。					
8	SPARE[1] bit – <i>I/O RAM</i> 0x2704[1]	复制 0x2704[1]的储存值,通用。					
9	SPARE[2] bit – <i>I/O RAM</i> 0x2704[2]	复制 0x2704[2]的储存值,通用。					
Α	WAKE	指示何时发生了 WAKE 事件。					
В	MUX_SYNC	内部复用帧 SYNC 信号。请参见图 4 和图 5。					
С	MCK	参见第 50 页第 2.5.3 节。					
E	GNDD	数字地,利用该信号将 TMUX2OUT 引脚置于静态。					
12	INT0 – DIG I/O						
13	INT1 – DIG I/O						
14	INT2 - CE_PULSE						
15	INT3 – CE_BUSY	中断 0,参见第 40 页第 2.4.9 节,另请参见第 46 页图 12。					
16	INT4 - VSTAT						
17	INT5 – EEPROM/SPI						
18	INT6 – XFER, RTC						
1F	RTM_CK (flash)	参见第 错误!未定义书签。 页第 2.3.5 节。					
注:							

未列出的 TMUX2[4:0]均为保留位。

3 功能说明

3.1 工作原理

电源供给负载的能量可表示为:

$$E = \int_{0}^{t} V(t)I(t)dt$$

假设相角不变,则下式成立:

- P = 有功能量[Wh] = V * A * cos φ* t
- Q = 无功能量[VARh] = V * A * sin φ * t
- S = 视在能量[VAh] = $\sqrt{P^2 + Q^2}$

对于实际电表,电压、电流幅值、相位角和谐波分量会时常变化。所以,简单的 RMS 测量本质上并不精确。现代固态电表 IC,例如 Teridian 71M6543,通过模拟上述积分运算进行计算,即处理 ADC 以恒定频率采集的电流和电压值。只要 ADC 分辨率足够高,采样频率高于所要求的谐波范围,将电流和电压采样值乘以采样时间周期,即可获得准确的瞬时能量。在时间上对瞬时能量值求和,即可获得非常准确的累积能量。

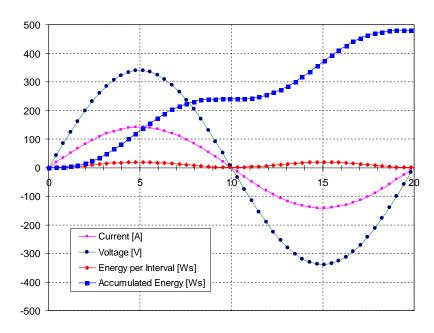


图 24. 电压、电流、瞬时能量和累积能量

图 24 所示为 V(t)、I(t)、瞬时功率和累积功率波形,电压和电流信号为 50 个采样点,周期为 20ms。 240VAC 和 100A 应用在 20ms 周期内的累积结果为 480Ws (= 0.133Wh),如累积功率曲线所示。即使存在动态相位偏移和谐波失真,上述采样法也能够可靠工作。

3.2 电池供电模式

施加系统电源(V3P3SYS)后,716543 处于任务模式(MSN 模式)。MSN 模式意味着器件由系统电源供电,内部 PLL 稳定。该模式是器件能够测量能量的常规工作模式。

系统电源不可用时,71M6543工作于以下三种电池模式之一:

- BRN 模式(掉电模式)
- LCD 模式(LCD 模式)
- SLP 模式(休眠模式).

内部比较器监测 V3P3SYS 引脚电压(注意,V3P3SYS 和 V3P3A 通常在 PCB 上连接在一起)。V3P3SYS 电压下降至 2.8 VDC 以下时,比较器复位 V3OK 内部电源状态位。只要断开系统电源且 V3OK = 0,71M6543 将强制工作在 71M6543,系统从 MSN 转换至 BRN 模式或从 BRN 转换至 MSN 时,MPU 继续执行代码。系统从 BRN 模式转换到 MSN 模式时,应该执行软复位以重新初始化 I/O RAM。根据 MPU 代码,MPU 可选择留在 BRN 模式,或者是转换到 LCD 或 SLP 模式(通过 I/O RAM 位 ICD_ONLY , I/O RAM Ox28B2[6]和 SLEEP, I/O RAM Ox28B2[7])。除了由系统电源供电外,BRN 模式与 MSN 模式类似,例如,不提供 ADC 和 CE (见表 62),电源电流源自 VBAT 引脚。BRN 模式下,PLL 继续以与 MSN 模式相同的频率工作,MPU 可以按需要配置 BRN。例如,它可以通过降低 PLL 或 MPU 时钟频率来进一步节省电池功率(关于 BRN 模式期间获得最低功耗的设置,请参见第 3.2.1 节 BRN 模式)。

恢复系统电源供电时,71M6543 从任何电池模式(BRN、LCD、SLP)自动恢复至 MSN 模式。

图 25 所示为各种工作模式的状态图,以及模式之间可能的转换。

器件在电池电源下唤醒时,自动进入 BRN 模式(见第 3.4 节唤醒功能)。从 BRN 模式,器件可进入 LCD 模式或 SLP 模式,由 MPU 控制。

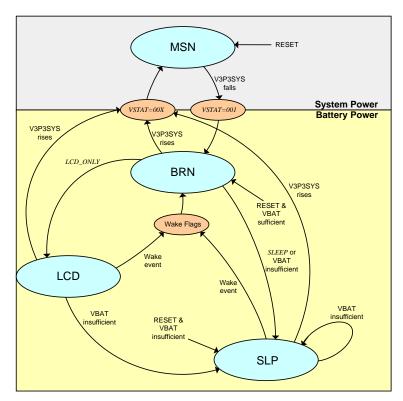


图 25. 工作模式状态图

从 LCD 和 SLP 模式至 BRN 模式的转换可由以下事件发起:

- 唤醒定时器超时。
- 按下按钮(PB)。
- SEGDIO4、SEGDIO52 或 SEGDIO55 引脚产生上升沿。
- RX或OPT_RX引脚有上升或下降沿产生。

MPU 可访问各种唤醒事件的标识寄存器,详情参见第 3.4 节唤醒功能。

表 62 所示为各种工作模式下的电路功能。

表 62. 电路功能

	系统	电源	电池电源				
电路功能	MSN (伯	E务模式)	BRN (挡	草电模式)		ᄹ	
	PLL_FAST=1	PLL_FAST=0	PLL_FAST=1	PLL_FAST=0	LCD	休眠	
CE (计算引擎)	有	有	1				
FIR	有	有					
ADC, VREF	有	有					
PLL	有	有	有	有	升压 2		
电池测量	有	有	有	有			
温度传感器	有	有	有	有	有	有	
最大 MPU 时钟速率	4.92MHz (从 PLL)	1.57MHz (从 PLL)	4.92MHz (从 PLL)	1.57MHz (从 PLL)			
MPU_DIV 时钟分频器	有	有	有	有			
ICE	有	有	有	有			
DIO 引脚	有	有	有	有			
看门狗定时器	有	有	有	有			
LCD	有	有	有	有	有		
LCD 升压	有	有	有	有	有		
EEPROM 接口(2 线)	有	有	有	有			
EEPROM接口(3线)	有	有	有	有			
UART (全速)	有	有	有	有			
光 TX 调制	38.4kHz	38.9kHz	38.4kHz	38.9kHz			
FLASH 读	有	有	有	有			
FLASH 页擦除	有	有	有	有			
FLASH 写	有	有	有	有			
RAM 读和写	有	有	有	有			
唤醒定时器	有	有	有	有	有	有	
OSC 和 RTC	有	有	有	有	有	有	
DRAM 数据保持	有	有	有	有			
NV RAM 数据保持	有	有	有	有	有	有	

注:

- . "--"表示相应电路不工作。
- 2. "升压"代表 LCD 升压电路工作(即 LCD_VMODE[1:0] = 10 (I/O RAM 0x2401[7:6])。LCD 升压电路需要来自 PLL 的时钟才可工作。所以,LCD 模式下,如果 LCD 升压使能,PLL 将自动保持势能状态,否则 PLL 关闭。

3.2.1 BRN模式

BRN 模式下,大多数非计量数字功能处于有效工作状态(如表 62 所示),包括 ICE、UART、EEPROM、LCD 和 RTC。BRN 模式下,PLL 继续以与 MSN 模式下相同的频率工作。MPU 应按比例缩小 PLL (使用 PLL_FAST,I/O RAM 0x2200[4])或 MPU 频率(使用 MPU_DIV[2:0],I/O RAM 0x2200[2:0]),以降低功耗。

BRN 模式下,MPU 可选择进入 LCD 或 SLP 模式。如果系统电源恢复时 71M6543 处于 BRN 模式,器件自动转换至 MSN 模式。

BRN 模式下推荐的最小功耗配置如下:

- RCE0 = 0x00 (I/O RAM 0x2709[7:0]) 禁用远端传感器
- LCD_BAT = 1 (I/O RAM 0x2402[7]) LCD 由 VBAT 供电
- LCD_VMODE[1:0] = 0 (I/O RAM 0x2401[7:6]) 禁用 5V LCD 升压
- CE6 = 0x00 (I/O RAM 0x2106) 禁用 CE、RTM 和 CHOP
- MUX_DIV[3:0] = 0 (I/O RAM 0x2100[7:4]) 禁用 ADC 复用器
- ADC E = 0 (I/O RAM 0x2704[4]) 禁用 ADC
- VREF_CAL = 0 (I/O RAM 0x2704[7]) 未驱动 Vref
- VREF DIS = 1 (I/O RAM 0x2704[6]) 禁用 Vref
- PRE E = 0 (I/O RAM 0x2704[5] 禁用前置放大器
- BCURR = 0 (I/O RAM 0x2704[3]) 关闭电池 100µA 电流负载
- TMUX[5:0] = 0x0E (I/O RAM 0x2502[5:0]) TMUXOUT 输出设置为直流值(即不做脉冲类输出)
- TMUX2[4:0] = 0x0E (I/O RAM 0x2503[4:0]) TMUXOUT2 输出设置为直流值(即不做脉冲类输出)
- CKGN = 0x24 (I/O RAM 0x2200) PLL 设置为低速, MPU_DIV[2:0] (I/O RAM 0x2200[2:0])设置为最大
- TEMP_PER[2:0] = 6 (I/O RAM 0x28A0[2:0]) 温度测量设置为每 512s 自动测量
- TEMP_BSEL = 1 (I/O RAM 0x28A0[7]) 温度传感器监测 VBAT
- PCON = 1 (SFR 0x87) 主 BRN 周期结束时, 挂起 MPU 并等待中断
- 根据需要调节波特率寄存器
- 禁用所有不使用的中断

3.2.2 LCD模式

通过置位 *LCD_ONLY* 控制位(*I/O RAM 0x28B2[6]*), MPU 任何时候均可控制 LCD 模式。然而,建议 MPU 只有在 71M6543 进入 BRN 模式后置位 *LCD_ONLY* 控制位。例如,如果 71M6543 处于 MSN 模式时置位 *LCD_ONLY*, LCD 模式的持续时间非常短,将立即"唤醒"71M6543。

LCD 模式下,V3P3D 禁用, VBAT 引脚提供 LCD 电流。 LCD_ONLY 模式有效之前,建议 MPU 把 PLL 输出频率降低至 6.29 MHz (即写 $PLL_FAST = 0$, I/O RAM 0x2200[4]),使 PLL 电流最小化。LCD 升压系统需要来自 PLL 的时钟才可工作。所以,如果使能 LCD 升压系统(即 $LCD_VMODE[1:0] = 10$, I/O RAM 0x2401[7:6]),PLL 在 LCD 模式下将自动保持有效,否则 PLL 关闭。

LCD 模式下, LCD_SEG 寄存器数据通过对应的段驱动器引脚显示。最多可使两个连接至 SEGDIO22 和 SEGDIO23 的 LCD 段闪烁,无需 MPU 参与(MPU 在 LCD 模式下被禁用)。为了将电池功耗最小化,应仅仅使能使用的段。

从 LCD 模式转换至 MSN 或 BRN 模式后,PC (程序计数器)为 0x0000,XRAM 处于未定义状态,配置 I/O RAM 位被复位(I/O RAM 唤醒后的状态见表 71)。LCD 模式下,储存在非易失 I/O RAM 的数据保持(表 71 中的阴影部分为非易失)。

3.2.3 SLP模式

只要没有主系统电源供电,MPU 即可通过置位 *SLEEP* 位(*I/O RAM 0x28B2[7]*)进入 SLP 模式。SLP 模式下功耗最低,此时仍然维持 RTC、RTC 温度补偿和非易失 I/O RAM 工作。

SLP模式下,断开 V3P3D 引脚,从而阻断所有可能的 VBAT 和 V3P3SYS 电流消耗。非易失存储器和基本电路,例如温度传感器、振荡器和 RTC,由 VBAT_RTC 输入供电。该模式下,保留 I/O 配置位、LCD 配置位和 NV RAM 数值,RTC 和振荡器保持工作。该模式只能通过系统上电或第 3.4 节唤醒功能中介绍的方法之一退出。

V3P3SYS 引脚提供供电电源时(即处于 MSN 模式),如果触发 *SLEE*P 位,71M6543 则进入 SLP 模式,复位内部 WAKE 信号,71M6543 开始按照第 3.4 节唤醒功能描述的标准步骤从休眠模式唤醒。

从 SLP 模式转换至 MSN 或 BRN 模式后, PC 为 0x0000, XRAM 处于未定义状态,仅部分保留 I/O RAM (见第 5.2 节中 I/O RAM 状态说明)。除非 RESET 变为高电平,否则 I/O RAM 的非易失部分被保留。

3.3 故障和复位操作

3.3.1 掉电事件

内部比较器通过监测 V3P3A 引脚的电压并监测内部产生的 VDD 电压(2.5 VDC)监测电源故障。V3P3SYS 和 V3P3A 引脚必须在 PCB 连接在一起,从而使内部连接至 V3P3A 的比较器能够同时监测 V3P3SYS 和 V3P3A 引脚电压。以下讨论假设 V3P3A 和 V3P3SYS 引脚在 PCB 连接在一起。

电源故障期间, 当 V3P3A 下降时, 检测两个门限:

- 第一个门限,3.0 VDC (VSTAT[2:0] = 001, $SFR \ 0xF9[2:0]$),向 MPU 报告模拟电路不再准确。除报告 MPU 外,超出该门限时,硬件不作任何操作。比较结果在内部产生 V3OKA 位。
- 第二个门限, 2.8 VDC, 使 71M6543 切换至电池供电。此时仍然能够对 FLASH 和 RAM 进行读、写。 该状态对应内部标志位 V3OK。

由 I/O RAM 空间内的 *VSTAT[2:0]*寄存器反映电源状况,如表 **63** 所示。*VSTAT[2:0]*寄存器位于 SFR 地址 F9,占用[2:0]位,*VSTAT[2:0]*字段为只读。

除了主电源状态, *VSTAT[2:0]*寄存器还提供电池供电时内部 VDD 电压的信息。注,如果系统电源(V3P3A)高于 2.8 VDC,71M6543 总是从电池切换至系统电源供电。

VSTAT[2:0]	说明
000	系统电源正常, V3P3A > 3.0 VDC。模拟电路正常工作并保持精确采集。
001	系统电源低, 2.8 VDC < V3P3A < 3.0 VDC。模拟电路不准确。即将切换至电池电源。
010	IC 由电池供电, VDD 正常。VDD > 2.25 VDC, IC 保持完整的数字功能。
011	IC 由电池供电, 2.25 VDC > VDD > 2.0 VDC。禁止 FLASH 写操作。
101	IC 由电池供电, VDD < 2.0 VDC, MPU 接近电压失效。在 4 个晶振时钟 CK32 周期内产生复位。

表 63. VSTAT[2:0] (SFR 0xF9[2:0])

对系统电源故障的响应几乎完全受固件控制。电源故障期间,系统电源电压缓慢下降。内部比较器监测到这一电压跌落,使硬件自动切换至 VBAT 输入供电。中断通知 MPU 由电池供电,此时,MPU 负责降低时钟频率、禁用 PLL,以降低功耗。

精密模拟电路,例如带隙基准、带隙缓冲器和 ADC,只能由 V3P3A 引脚供电(即由 V3P3A 引脚供电的电路不能切换至 VBAT 供电);随着 V3P3A 引脚电压持续下降,这部分电路的精度下,最终导致失效。 V3P3A 引脚下降至 2.8 VDC 以下时,ADC 时钟暂停,放大器无偏置电压。在此期间,控制位,例如 ADC_E 位(I/O RAM 0x2704[4]),不受影响,因为其 I/O RAM 由 VDD 引脚(2.5 VDC)供电。 VDD 引脚通过连接至 V3P3D 引脚的内部 2.5 VDC 稳压器供电。 V3P3SYS 引脚下降至 3.0 VDC 以下时,V3P3D 引脚切换至 VBAT 引脚供电。注意,V3P3SYS 和 V3P3A 引脚通常在 PCB 连接在一起。

3.3.2 低电池电压下的IC

没有系统电源供电时,71M6543 将依赖 VBAT 引脚供电。如果 VBAT 电压不足以将 VDD 维持在 2.0 VDC 或更高,MPU 则无法可靠工作。器件工作于 BRN 模式,或者潜伏于 SLP 或 LCD 模式时,将导致 VBAT 电压跌落。依据 MPU 程序,可区分两种情形:

- 情形 1: 无系统电源供电,器件从 SLP 或 LCD 模式唤醒。这种情况下,硬件检查 VDD 数值,确定处理器是否可能工作。如果不可能工作,器件将配置为 BRN 工作模式,保持处理器复位(WAKE=0)到该模式下,VBAT 为 LCD 系统、VDD 稳压器、PLL 和故障比较器提供 1.0 VDC 基准。器件维持在这种等待模式,直到施加系统电源或更换电池或重新为 VBAT 电池充电,使 VDD 达到足够的电压。
- 情形 2: 器件由 VBAT 供电,*VSTAT[2:0] (SFR 0xF9[2:0])*变为 101(二进制),表示 VDD 下降至 2.0 VDC。这种情况下,固件有两种选择:
 - 1) 一种选择是立即触发 *SLEEP* 位(*I/O RAM 0x28B2[7]*)。这样可以保持 VBAT 中的剩余电量。当然,如果电池电压未升高,71M6543 只要试图唤醒,则进入情形 1。
 - 1) 2) 另一种选择是立即进入情形 1 所述的等待模式,即如果固件未触发 *SLEEP* 位,硬件在 *VSTAT[2:0]* 变为 101 后 4 个 CK32 时钟周期(即 122µs)后复位处理器,如情形 1 所述,开始等待 VDD 变为高于 2.0 VDC。系统电源恢复时,或者 VDD 高于 2.0 VDC 时,MPU 唤醒。

无论哪种情况,当 VDD 恢复,同时 MPU 唤醒时,可读取 WF_BADVDD 标识(I/O RAM 0x28B0[2]),确定处理器正从 VBAT 失效条件下恢复。 WF_BADVDD 标识保持置位,直到下一次 WAKE 变低。该标记独立于其它 WF 标识。

任何情况下,低 VBAT 电压都不会破坏 RTC 工作、NV 存储器状态或非易失存储器状态。因为这些电路由 VBAT RTC 引脚供电。

3.3.3 复位序列

RESET 引脚拉高时,芯片内的所有数字功能停止,只有振荡器和 RTC 除外。此外,全部 I/O RAM 强制为其 RST 状态。只有 RESET 为高电平并维持至少 2µs 的条件下,才发生可靠复位。注意,TMUX 和 RTC 的复位条件:TEST 引脚在 RESET 为高电平时拉高。

RESET 控制位(I/O RAM 0x 2200[3])与 RESET 引脚的复位效果完全相同。唯一需要保证的是 RESET 控制位使用的复位定时器更短。

一旦启动,复位序列进行等待,直到复位定时器超时。超时发生在 4100 个 CK32 周期(125ms)内,此时,MPU 从 0x0000 地址开始执行预引导和引导程序。关于预引导和引导程序的详细说明,请参见第 2.5.1.1 节。

如果没有系统电源,复位定时器持续时间为 2 个 CK32 周期,此时,MPU 从地址 0x0000 开始执行 BRN 模式。

ICE 接口的 E_RST 引脚拉低时,启动软件复位。该事件造成 MPU 及 MPU 核内其它寄存器复位,但是不复位 71M6543 的其余部分。它不触发复位过程,这类复位的本意是复位 MPU 程序,而对芯片的状态不做其它更改。

3.3.4 看门狗定时器(WDT)复位

看门狗定时器(WDT)说明请参考 2.5.13 节。

WDT 溢出时,状态位 WF_OVF (I/O RAM 0x28B0[4])置位。与其它唤醒标识相似,该位由非易失电源供电,可由 MPU 读取,以确定芯片复位是因为 WD 溢出、还是重新上电。 WF_OVF 位由 RESET 信号清零。

MPU 内部没有寄存器可以禁止 WDT。然而,为了调试,可将 ICE_E 引脚升高至 3.3 VDC,禁用 WDT。

正常工作时,通过定期向 WD_RST 控制位(I/O RAM 0x28B4[7])写 1 进行"喂狗"。71M6543 从 LCD 或 SLP 模式唤醒时,以及 ICE E = 1 时,看门狗定时器也复位。

3.4 唤醒操作

如上所述,系统电源恢复时,器件总是在 MSN 模式唤醒。如第 3.2 节电池供电模式所述,从 LCD 和 SLP 模式至 BRN 模式的转换可由唤醒定时器超时、手动按钮(PB)输入、SEGDIO4/SEGDIO52/SEGDIO55 置高,或者触发 RX 或 OPT RX 引脚启动。

3.4.1 硬件唤醒

以下引脚信号事件将 71M6543 从 SLP 或 LCD 模式唤醒:PB 引脚的高电平、RX 引脚的任意信号沿、SEGDIO4 引脚的上升沿、SEGDIO52 引脚的高电平,SEGDIO55 引脚的高电平或 OPT_RX 引脚的任意信号沿。关于每一引脚的去抖,及 OPT_RX/SEGDIO55 引脚的更多信息,请参见表 64。SEGDIO4、SEGDIO52 和 SEGDIO55 引脚必须配置为 DIO 输入,且必须置位其唤醒使能位(EW_x 位)。SLP 和 LCD 模式下,MPU 保持在复位状态,不能轮询引脚或响应中断。发生其中一个硬件唤醒事件时,内部 WAKE 信号升高,MPU 在 3 个 CK32 周期内开始执行。MPU 通过检查 WF_PB、WF_RX、WF_SEGDIO4、WF DIO52 或 WF DIO55 标识,可确定哪个引脚将其唤醒(见表 64)。

如果器件处于 SLP 或 LCD 模式,可由 PB 引脚的高电平唤醒。该引脚通常拉至 GND,可从外部连接,所以可用按钮将其拉高。

有些引脚需要去抖,以抑制 EMI 噪声。检测硬件忽略初始跳变以后的所有跳变。表 64 列出了配有防抖电路的引脚。

没有去抖电路的引脚,仍然必须保持为高电平至少达 2us 才能有效识别。

表 64 还列出了唤醒使能和标识位。唤醒标识位由硬件在 MPU 从唤醒事件唤醒时置位。注意,只要按下 PB, PB 标识即被置位,即使器件处于唤醒状态。表 66 列出了清除 WF 标识的事件。

除按钮和定时器外,器件还可以由以下事件重启:RESET 引脚、RESET 控制位(I/O RAM 0x2200[3])、WDT、冷启动检测器和 E_RST。如表 64 所示,每种方法都有一个标识位,向 MPU 通告唤醒源。如果唤醒是由于系统电源恢复引起的,则没有有效的 WF 标识,VSTAT[2:0]字段(SFR 0xF9[2:0])表示系统电源稳定。

And a service to the target of target of target of the target of targe										
唤醒	使能	唤醒	标识	++91	2% BB					
名称	位置	名称	位置	去抖	说明					
WAKE_ARM	28B2[5]	WF_TMR	28B1[5]	无	定时器唤醒。					
EW_PB	28B3[3]	WF_PB	28B1[3]	有	PB 唤醒*。					
EW_RX	28B3[4]	WF_RX	28B1[4]	2µs	RX 信号沿唤醒。					
EW_DIO4	28B3[2]	WF_DIO4	28B1[2]	2µs	SEGDIO4 唤醒。					
EW_DIO52	28B3[1]	WF_DIO52	28B1[1]	有	SEGDIO52 唤醒*。					
EW_DIO55	28B3[0]	WF_DIO55	28B1[0]	有	SECURE = 1:DIO55*唤醒, 64ms 去抖。 OPT_RXDIS = 0:OPT_RX 信号眼唤醒, 2µs 去抖。 OPT_RXDIS: I/O RAM 0x2457[2]					
总负	走能	WF_RST	28B0[6]	2 µs	RESET 后唤醒。					
总负	 走能	WF_RSTBIT	28B0[5]	无	RESET位之后唤醒。					
总使能		WF_ERST	28B0[3]	2 µs	E_RST 后唤醒。 (只有 ICE_E 为高电平才有效)					
总债	走能	WF_OVF	28B0[4]	无	WD复位后唤醒。					
总负	走能	WF_CSTART	28B0[7]	无	冷启动后唤醒—首次加电。					
总例	走能	WF_BADVDD	28B0[2]	无	VBAT 电压不足后唤醒。					

表 64. 唤醒使能和标识位

^{*} 每 2ms 采样该引脚一次,必须保持为高达 64ms 才能为有效的高电平。该引脚为高电平触发。

表 65. 唤醒位

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明
EW_DIOR	28B3[2]	0	_	R/W	连接 SEGDIO4 至 WAKE 逻辑,允许 SEGDIO4 上升唤醒器件。除非 SEGDIO4 配置为数字输入,否则无效。
EW_DIO52	28B3[1]	0	ı	R/W	连接 DIO52 至 WAKE 逻辑,允许 DIO52 高电平唤醒器件。除非 DIO52 被配置为数字输入,否则无效。
EW_DIO55	28B3[0]	0	1	R/W	连接 DIO55 至 WAKE 逻辑,允许 DIO55 高电平唤醒器件。除非 DIO55 配置为数字输入,否则无效。
WAKE_ARM	28B2[5]	0	I	R/W	准备好 WAKE 定时器,并装载 WAKE_TMR 寄存器(I/O RAM 0x2880)值。MPU 使能 SLP 模式或 LCD 模式时,WAKE 定时器有效工作。
EW_PB	28B3[3]	0	-	R/W	连接 PB 引脚至 WAKE 逻辑,允许 PB 高电平唤醒器件。PB 总是配置为输入。
EW_RX	28B3[4]	0	_	R/W	连接 RX 引脚至 WAKE 逻辑,允许 RX 上升唤醒器件。关于去抖事项,请参见第 3.4.1 节。
WF_DIO4	28B1[2]	0	_	R	SEGDIO4 标识位。如果 SEGDIO4 配置为唤醒器件, 只要 SEGDIO4 升高,该位置位。如果 SEGDIO4 未 配置为唤醒,它将保持在复位状态。
WF_DIO52	28B1[1]	0	-	R	SEGDIO52 标识位。如果 SEGDIO52 配置为唤醒器件,只要 SEGDIO52 为高电平,该位置位。如果 SEGDIO52 未配置为唤醒,它将保持在复位状态。
WF_DIO55	28B1[0]	0	_	R	SEGDIO55 标识位。如果 SEGDIO55 配置为唤醒器件,只要 SEGDIO55 为高电平,该位置位。如果 SEGDIO55 未配置为唤醒,它将保持在复位状态。
WF_TMR	28B1[5]	0	_	R	表示唤醒定时器造成器件唤醒。
WF_PB	28B1[3]	0	_	R	表示 PB 引脚造成器件唤醒。
WF_RX	28B1[4]	0	_	R	表示 RX 引脚造成器件唤醒。
WF_RST WF_RSTBIT WF_ERST WF_CSTART WF_BADVDD	28B0[6] 28B0[5] 28B0[3] 28B0[7] 28B0[2]	* * * * *	-	R	表示 RST 引脚、E_RST 引脚、RESET 位(I/O RAM 0x2200[3])、冷启动检测或 VBAT 引脚的低电压造成器件复位。 *详细信息请参见表 66。

表 66	WAKE	标识清除事件
1X UU.	VVANE	

标识	唤醒事件	清除事件
WF_TMR	定时器终止	WAKE 变低
WF_PB	PB 引脚高电平	WAKE 变低
WF_RX	RX 引脚信号沿	WAKE 变低
WF_DIO4	SEGDIO4 上升沿	WAKE 变低
WF_DIO52	SEGDIO52 高电平	WAKE 变低
WF_DIO55	如果 <i>OPT_RXDIS</i> = 1 (<i>I/O RAM</i> 0 <i>x2457[2]</i>), SEGDIO55 高电平唤醒 如果 <i>OPT_RXDIS</i> = 0,OPT_RX 任意信号 沿唤醒	WAKE 变低
WF_RST	RESET 引脚驱动为高	WAKE 变低,WF_CSTART, WF_RSTBIT, WF_OVF, WF_BADVDD
WF_RSTBIT	RESET 位置位(I/O RAM 0x2200[3])	WAKE 变低,WF_CSTART, WF_OVF, WF_BADVDD, WF_RST
WF_ERST	E_RST 引脚驱动为高,必须通过驱动 ICE_E 引脚为高电平,使能 ICE。	WAKE 变低,WF_CSTART, WF_RST, WF_OVF, WF_RSTBIT
WF_OVF	看门狗(WD)复位	WAKE 变低,WF_CSTART, WF_RSTBIT, WF_BADVDD, WF_RST
WF_CSTART	冷启动(即首次加电后)	WAKE 变低,WF_RSTBIT, WF_OVF, WF_BADVDD, WF_RST

注:

"WAKE 变低"意味着内部 WAKE 信号已复位,在进入 LCD 模式或 SLEEP 模式时自动发生 WAKE 信号 复位(即 MPU 置位 LCD_ONLY 位(I/O RAM 0x28B2[6])或 SLEEP (I/O RAM 0x28B2[7])位)。内部 WAKE 信号复位时,全部唤醒标识被复位。由于各种唤醒标识在 WAKE 变低时自动复位,MPU 就没必要在进入 LCD 模式或 SLEEP 模式之前复位这些标识。此外,其它唤醒事件会造成唤醒标识复位,如上所示(例如,WF RST标识在以下标识置位时被复位:WF CSTART、WS RSTBIT、WF OVF、WF BADVDD)。

3.4.2 定时器唤醒

如果器件处于 SLP 或 LCD 模式,可由唤醒定时器唤醒。该定时器超时之前,由于 WAKE 信号为低,MPU 处于复位状态。唤醒定时器超时时,WAKE 升高,MPU 在三个 CK32 周期内开始执行。通过检查 WF_TMR 唤醒标识(I/O RAM Ox28B1[2]),MPU 可判断为定时器唤醒。

器件进入 LCD 或 SLP 模式时,唤醒定时器开始计时。其持续时间由 $WAKE_TMR[7:0]$ 寄存器(I/O RAM 0x2880)控制。定时器持续时间为 $WAKE_TMR[7:0]$ +1 秒。

通过设置 $WAKE_ARM = 1$ (I/O RAM Ox28B2[5])使能唤醒定时器,启动 SLP 或 LCD 模式之前必须至少有 3 个 CK32 的延时。置位 $WAKE_ARM$ 以使能 $WAKE_TMR$ 预设定时器,MPU 写 SLEEP (I/O RAM Ox28B2[7]) 或 LCD_ONLY (I/O RAM Ox28B2[6])位时,启动唤醒定时器。MPU 唤醒时,定时器既不复位也不运行。因此,一旦设定和置位,MPU 在进入 SLP 模式或 LCD 模式后将每 $WAKE_TMR[7:0]$ 秒后唤醒(即,一旦写入, $WAKE_TMR[7:0]$ 寄存器保持其值,不必在 MPU 每次进入 SLP 或 LCD 模式时重写。此外,由于 $WAKE_TMR[7:0]$ 非易失,所以能在复位和电源故障时保持数据)。

3.5 数据流和MPU/CE通信

计算引擎(CE)和 MPU 之间的数据流如图 26 所示。典型应用中,32 位 CE 顺序处理来自 IA、VA、IB 等引脚 ADC 输入电压的采样,执行计算,测量有功(Wh)、无功(VARh)、 A^2h 和 V^2h ,实现四象限表计。然后 MPU 存取这些测量值,进一步处理并通过 MPU 可用的外围器件输出。

CE 和复用器均由 MPU 通过 I/O RAM 和 RAM 中的共用寄存器控制。

CE 总共可以输出 6 种信号至 MPU。包括 4 个脉冲和 2 个中断:

- CE BUSY
- XFER BUSY
- WPULSE, VPULSE (用于有功和无功能量的脉冲)
- XPULSE, YPULSE (辅助脉冲)

这些中断作为外部中断连接至 MPU 中断服务输入,CE_BUSY 表示 CE 正在处理数据,每个复用周期(典型为 1/2520=396µs)产生一次该信号,表示 CE 已经更新 CESTATUS 寄存器(CE RAM 0x80)中的状态信息。

XFER_BUSY 表示 CE 正在将数据更新至 RAM 输出区域。CE 完成由 *SUM_SAMPS[12:0]、I/O RAM 0x2107[4:0]、2108[7:0]*确定的累积间隔(通常每隔 1000 ms)内的数据累加,就会产生该指示。MPU 的中断发生在 XFER BUSY 和 CE BUSY 信号的下降沿。

WPULSE 和 VPULSE 通常用于表示有功(Wh)和无功(VARh)能量的累积。将 WPULSE 和 VPULSE 纳入MPU 中断系统可实现脉冲计数。

XPULSE 和 YPULSE 用于向 MPU 发出事件告警。例如电网电压跌落和过零。将这些输出纳入 MPU 中断系统,MPU 就没必要在每次发生 CE_BUSY 中断时读取 *CESTATUS* 寄存器,以检测跌落或过零事件。

更多有关 CE 设置的信息,请参见第 120 页 5.4 节 CE 接口说明。

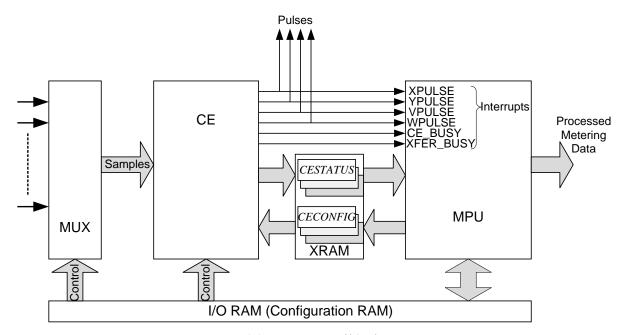


图 26. MPU/CE 数据流

4 应用信息

4.1 连接 5V器件

71M6543 的全部数字输入兼容于外部 5V 供电器件。配置为输入的 I/O 引脚连接至外部 5V 供电器件时,不需要加限流电阻。

4.2 直接连接传感器

图 27 至图 30 所示为电压检测分压电阻、电流检测电流变压器(CT)和电流检测锰铜分流器,以及它们与71M6543 连接示意图。连接至 71M6543 传感器输入的全部输入信号为电压信号,按比例表示检测到的电压或电流。



71M6543 的模拟输入引脚设计用于低阻传感器。RC 滤波器的电阻值不要超过 Teridian 演示板中的电阻阻值。关于完整的传感器输入电路及对应元件值,请参见演示板原理图。

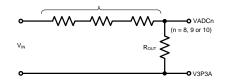


图 27. 电阻分压(电压检测)

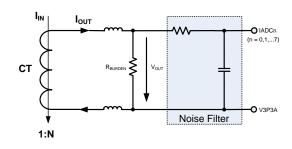


图 28. 单端输入 CT (电流检测)

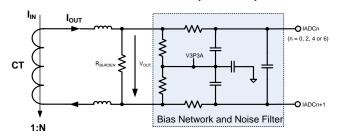


图 29. 差分输入 CT (电流检测)

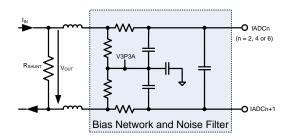


图 30. 差分输入锰铜分流器(电流检测)

4.3 使用 71M6xx3 隔离传感器和分流器的系统架构

图 31 所示为分流传感器的典型连接,采用 71M6xx3 (多相)隔离传感器。注意,电流传感器采用非隔离连接,本例中为零相电流传感器(连接至引脚 IADC0-IADC1)。每个 71M6xx3 器件由低成本脉冲变压器进行电气隔离。71M6543 电流传感器输入必须配置为远端传感器通信,如 2.2.8 节 71M6xx3 隔离传感器接口所述(第 22 页)。采用 I/O RAM 寄存器 *MUXn_SEL[3:0]*灵活的再映射,允许模拟输入引脚的顺序不同于标准配置(必须使用相应的 CE 代码)。图 2 所示为对应于图 31 的 AFE 配置。

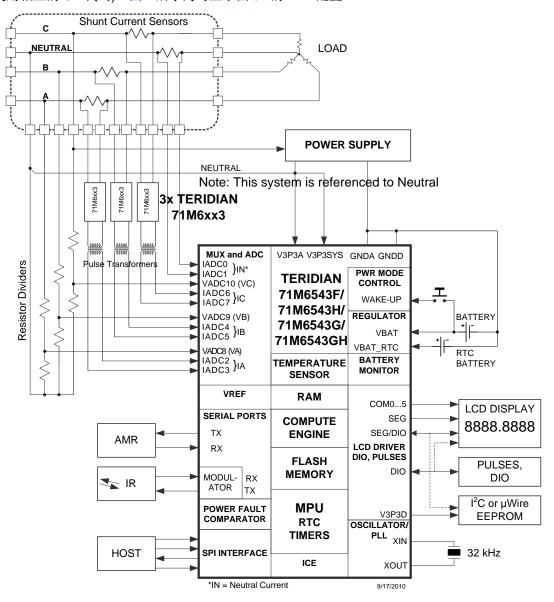


图 31. 使用三个远端和一个本地(零相)传感器的系统架构

4.4 使用电流变压器的系统 架构

图 32 所示的多相系统中采用了四个电流变压器,以支持可选的零相电流检测,用于防窃电。如果不需要零相电流检测功能,可省去零相电流检测 CT。系统以零相为参考(即零相电压接至 V3P3A 和 V3P3SYS)。

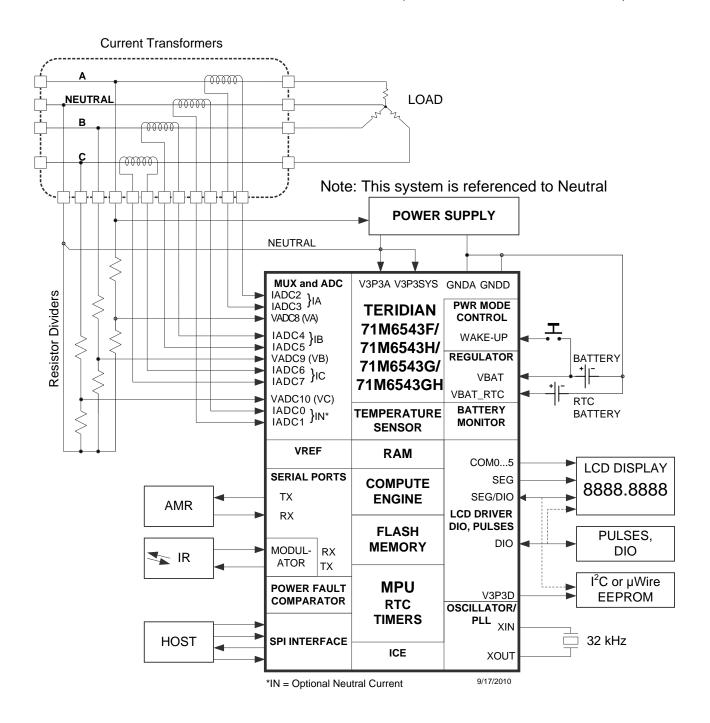


图 32. 使用电流变压器的系统

4.5 计量温度补偿

4.5.1 标准和高精度器件的区别

由于 VREF 的带隙放大器带有斩波稳定电路(由 *CHOP_E[1:0] I/O RAM 0x2106[3:2]*控制字段设置),因此可以有效的消除电压基准(VREF)常见的长期漂移。71M6543 和 71M6xx3 各自的 VREF 电压基准源均具有斩波电路。

由于带隙基准电压(VREF)的变化是整个温度范围内测量误差的主要原因,Teridian 在器件制造过程中采用两个步骤微调、表征 VREF 电压基准。

第一步用于所有器件(71M6543F、71M6543H、71M6543G、71M6543GH)。第一步中,基准电压(VREF) 微调至目标值 1.195V。 调节过程中,*TRIMT*[7:0] (*I/O RAM 0x2309*)储存在非易失熔丝。*TRIMT*[7:0]调节到某一适当值,使得 VREF 随温度变化的波动最小。

对于 71M6543F 和 71M6543G 器件(±0.5%能量精度), MPU 可在初始化期间读取 *TRIMT[7:0]*,以计算适合每个 71M6543F 和 71M6543G 器件的温度补偿系数抛物线。保证 71M6543F 和 71M6543G 中 VREF 的温度系数为±40ppm/°C。

考虑到工厂的 VREF 校准温度为+22℃,工作在工业级温度范围(-40℃ 至+85℃),71M6543F 和71M6543G 器件在极端温度下的 VREF 误差可计算如下:

$$(85^{\circ}C - 22^{\circ}C) \cdot 40 ppm/^{\circ}C = +2520 ppm = +0.252\%$$

和

$$(-40^{\circ}C - 22^{\circ}C) \cdot 40 \, ppm/^{\circ}C = -2480 \, ppm = -0.248\%$$

以上计算结果表示:理论上,电压和电流测量值的最大误差分约为±0.25%。电压采样和电流采样相乘,获得每次采样的能量时,电压误差和电流误差组合造成最大能量测量误差为±0.5%。然而,理论误差±0.5%仅考虑了电压基准(VREF)一个误差源。实际应用中,系统中还有其它误差源。基本的剩余误差源包括:电流传感器(分流器或 CT)及其对应的信号处理电路,以及用于测量电压的分压电阻。因此 0.5%级 71M6543F 和71M6543G 器件应用于 1%级设计时,为系统中其它误差源留有足够裕量。

71M6543H 和 71M6543GH 器件(±0.1%能量精度)在生产过程中经过额外的工艺处理,使其满足高精度应用要求。附加处理包括:对电压基准(VREF)随时间变化特性的特征处理。电压基准系数储存在非易失微调熔丝中。MPU 可在初始化期间读取这些熔丝器件,并计算适合每个 71M6543H 和 71M6543GH 器件的温度补偿系数抛物线。保证 71M6543H 和 71M6543GH 内 VREF 的温度系数为±10 ppm/°C。

71M6543H 和 71M6543GH 器件在极端温度下的 VREF 误差可计算如下:

$$(85^{\circ}C - 22^{\circ}C) \cdot 10 ppm/^{\circ}C = +630 ppm = +0.063\%$$

和

$$(-40^{\circ} C - 22^{\circ} C) \cdot 10 \, ppm/^{\circ} C = -620 \, ppm = -0.062\%$$

电压采样和电流采样相乘,获得每次采样的能量,电压误差和电流误差组合造成的最大能量测量误差为±0.126%。71M6543H 和 71M6543GH 0.1%级器件应该用于 0.2%级和 0.5%级设计时,为系统中其它误差源留有足够裕量。

本节之前讨论的内容也适用于 71M6603 (0.5%)、71M6113 (0.5%)和 71M6203 (0.1%)远端传感器,详细信息请参见 71M6xxx 数据资料。

4.5.2 71M6543F和 71M6543G温度系数

下面提供的公式用于计算加至 **71M6543F** 和 **71M6543G** (0.5%能量精度)的 TC1 和 TC2。为了获得 TC1 和 TC2,MPU 读取 *TRIMT*[7:0] (*I/O RAM 0x2309*),并使用提供的 TC1 和 TC2 公式。然后即可利用 TC1 和 TC2 计算 PPMC 和 PPMC2,如下所示。得到的基准电压(VREF)曲线控制在±40ppm/°C 之内,对应于±0.5% 能量测量精度。请参见第 **4.5.1** 节标准和高精度器件的区别。

$$TC1(\mu V/^{\circ}C) = 275 - 4.95 \cdot TRIMT$$

 $TC2(\mu V/^{\circ}C^{2}) = -0.557 + 0.00028 \cdot TRIMT$
 $PPMC = 22.4632 \cdot TC1$
 $PPMC2 = 1150.116 \cdot TC2$

关于温度补偿的更多详细信息,请参见第4.5.5节和第4.5.6节。

4.5.3 71M6543H和 71M6543GH的温度系数

71M6543H 和 71M6543GH 经过两个工厂微调过程,存储了附加微调熔丝值。附加微调熔丝值表示器件在不同温度下的 VREF 变化。利用从 *TRIMT[7:0]* (*I/O RAM 0x2309*)、*TRIMBGB[15:0]* (信息页 0x92 和 0x93) 和 *TRIMBGD[7:0]* (信息页 0x94)非易失片上熔丝读取的数值,按照公式计算得到 TC1 和 TC2。由此得到的基准电压(VREF)可以保持在±10 ppm/°C 以内,对应于±0.126%能量测量精度。本文提供了利用 TC1 和 TC2 推倒出 PPCM 和 PPMC2 的公式,参见第 4.5.1 节标准和高精度器件的区别。

$$TC1(\mu V/^{\circ}C)$$
=35.091+0.01764· $TRIMT$ +1.587· $(TRIMBGB - TRIMBGD)$
 $TC2(\mu V/^{\circ}C^{2}) = -0.557 - 0.00028 \cdot TRIMT$
 $PPMC = 22.4632 \cdot TC1$
 $PPMC2 = 1150.116 \cdot TC2$

*TRIMT[7:0]*微调 VREF 电压,确保随温度的变化最小。*TRIMT[7:0]*熔丝由 MPU 直接在 I/O RAM 地址 0x2309[7:0]读取。

71M6543H 和 71M6543GH 的第二次微调期间,对 VREF 在 85°C 和 22°C 下进一步特征化,产生的熔 丝调节值分别储存在 TRIMBGB[15:0]和 TRIMBGD[7:0]。TRIMBGB[15:0]和 TRIMBGD[7:0]不能由 MPU 直接读取。关于如何读取信息页调节熔丝值的信息,请参见第 118 页第 5.3 节读读取信息页(71M6543H 和 71M6543GH)。

关于温度补偿的更多详细信息,请参见第 4.5.5 节和第 4.5.6 节。

4.5.4 71M6xx3 的温度系数

关于适用于每款 71M6xx3 器件的公式和对应的温度系数,请参考 71M6xxx 数据资料。

4.5.5 VREF和分流传感器的温度补偿

本节讨论将电流分流传感器与 Teridian 的 71M6xx3 远端隔离传感器配合使用时,电表设计的温度补偿,如图 31 所示。

任何直接连接到 71M6543 的传感器受 71M6543 VREF 电压变化(随温度变化)的影响。另一方面,连接到 71M6xx3 远端传感器的分流传感器受 71M6xx3 中 VREF 的影响。71M6543 和 71M6xx3 中的 VREF 可利用温度的二阶多项式函数进行数字补偿。71M6543 和 71M6xx3 都具有温度传感器,对其 VREF 进行温度补偿。必须在 MPU 固件中完成补偿计算。

参见图 31, VADC8 (VA)、VADC9 (VB)和 VADC10 (VC)电压传感器直接连接到 71M6543。所以,电压传感器的精度主要受 71M6543 VREF 的影响。电压传感器的分压电阻(见图 27)温度系数决定分压比随温度的变化。建议采用具有低温度系数的电阻,利用相同工艺、同一系列的电阻构成分压器,将分压比受温度的影响降至最小。电阻必须满足额定电压的要求。

71M6543 也可以有一个本地分流传感器,通过 IADC0-IADC1 输入引脚直接连接,因此,该本地电流传感器也受 71M6543 VREF 的影响。外部电流传感器的阻值同样也受温度的影响,为了满足精度等级的要求,可能需要其进行补偿。

IADC2-IADC3、IADC4-IADC5 和 IADC6-IADC7 电流传感器通过 71M6xx3 隔离,主要受 71M6xx3 VREF 随温度变化的影响。另外,对应的远端分流传感器也随温度发生变化。

MPU 根据检测到的温度计算每个传感器通道采样值的增益补偿。Teridian 提供演示例程,实现如下所示 *GAIN_ADJx* 补偿方程。所得到的 *GAIN_ADJx* 由 MPU 储存在五个 CE RAM 地址: *GAIN_ADJO-GAIN_ADJ5* (*CE RAM 0x40-0x44*)。演示例程提供了适当的温度补偿方法,但利用片上温度传感器,MPU 固件也可以通过方法实现温度补偿,将采样增益调节结果储存到 *CE RAM GAIN_ADJx 地址*,供 CE 使用。演示程序保持五组独立的 *PPMC* 和 *PPMC* 系数,并根据检测到的温度利用下式计算五个独立的 *GAIN ADJx*:

$$GAIN _ADJx = 16385 + \frac{10 \cdot TEMP _X \cdot PPMC}{2^{14}} + \frac{100 \cdot TEMP _X^2 \cdot PPMC2}{2^{23}}$$

CE 利用 MPU 储存在 CE RAM 中的 $GAIN_ADJx$ 数值调整每个相应的传感器通道, $GAIN_ADJx$ 为 16,384 (即 2^{14})时,对应于单位增益;小于 16,384 时,将对采样值进行衰减;大于 16,384 时,对采样值进行放大。

上式中, $TEMP_X$ 为相对于标称或校准温度的偏差,以 0.1 °C 的整数倍表示。式中出现 10x 和 100x 系数是由于 $TEMP_X$ 的单位为 0.1 °C。例如,如果校准(参考)温度为 22 °C,实测温度为 27 °C,那么 10* $TEMP_X$ = (27-22) x 10 = 50 (十进制),表示相对于 22°C的偏差为+5°C。演示程序中, $TEMP_X$ 由 MPU 利用 STEMP[10:0]温度传感器读数,采用下式计算得到,并以 0.1 °C 为单位。关于利用 STEMP[10:0]计算以°C 为单位的温度公式,请参考第 55 页 2.5.5 节 71M6543 温度传感器。

表 67 给出了图 31 所示 1 个本地传感器/3 个远端传感器配置下的五个 GAIN_ADJx 公式输出储存位地址和补偿电压或电流传感器通道。

增益调整输出	CE RAM 地址	传感器通道(引脚名称)	补偿:
GAIN_ADJ0	0x40	VADC8 (VA) VADC9 (VB)	71M6543 的 VREF 和分压电阻
		VADC10 (VC)	
GAIN_ADJ1	0x41	IADC0-IADC1	71M6543 的 VREF 和分流器(零相电流)
GAIN_ADJ2	0x42	IADC2-IADC3	71M6543 的 VREF 和分流器(A 相电流)
GAIN_ADJ3	0x43	IADC4-IADC5	71M6543 的 VREF 和分流器(B 相电流)
GAIN_ADJ4	0x44	IADC6-IADC7	71M6543 的 VREF 和分流器(C 相电流)

表 67. GAIN ADJn 补偿通道(图 2、图 31、表 1)

演示程序中,温度补偿二阶抛物线的形状由 *PPMC* (1 阶系数)和 *PPMC*2 (2 阶系数)中储存的数值决定,通常 MPU 在初始化时由储存在 EEPROM 的数值设置。

为了禁用演示程序中的温度补偿,将每个 GAIN_ADJx 通道的 PPMC和 PPMC2 设为零。使能温度补偿时,PPMC 和 PPMC2 系数设置为与分流传感器的预期温度变化(必要时)和对应 VREF 电压基准随温度变化(求和)相匹配的数值。

分流传感器需要二阶多项式补偿,补偿系数由相应电流测量通道的 PPMC 和 PPMC2 系数决定。VREF 电压基准也需要 PPMC 和 PPMC2 系数支持电压基准的二阶温度补偿。与分流器和对应 VREF 相关的 PPMC 和 PPMC2 求和,获得给定电流检测通道的补偿系数(即 1 阶 PPMC 系数进行求和,2 阶 PPMC2 系数进行求和)。

71M6543F 和 71M6543G 中,所需要的 VREF 补偿系数 *PPMC* 和 *PPMC*2 由可读取的片上非易失熔丝值 计算得到(参见第 4.5.2 节 71M6543F 的温度系数)。温度系数确保 71M6543F 和 71M6543G 中的 VREF 温 漂达到±40 ppm/°C。71M6xx3 远端传感器的 PPMC 和 PPMC2 系数计算与此类似(参见第 4.5.4 节 71M6xx3 的温度系数)。

对于 71M6543H 和 71M6543GH (±0.1%计量精度),每个器件的系数可从在工业及温度范围内定义 VREF 特征参数的附加片上熔丝读取计算(参见第 4.5.3 节 71M6543H 的温度系数)。补偿后可以获得±10 ppm/°C 以内的 VREF 电压。

对于电流通道,为了确定分流传感器的 *PPMC* 和 *PPMC*2 系数,设计者必须从制造商的数据资料中获得分流器的平均温度曲线,或在实验室对设计使用的分流器进行特性分析,获得这些系数。

4.5.6 VREF和电流变压器的温度补偿

本节讨论使用电流变压器(CT)的电表计量温度补偿,如图 32 所示。

任何直接连接到 71M6543 的传感器受 71M6543 VREF 电压变化(随温度变化)的影响。71M6543 的 VREF 可利用温度的二阶多项式函数进行数字补偿。71M6543 内置温度传感器,对其 VREF 进行温度补偿。必须在 MPU 固件中完成补偿计算,将补偿系数写入相应的 *GAIN ADJx* CE RAM 地址。

参见图 32, VADC8 (VA)、VADC9 (VB)和 VADC10 (VC)电压传感器直接连接到 71M6543。所以,电压传感器的精度主要受 71M6543 VREF 的影响。电压传感器的分压电阻(见图 27)温度系数决定分压比随温度的变化。建议采用具有低温度系数的电阻,利用相同工艺、同一系列的电阻构成分压器,将分压比受温度的影响降至最小。电阻必须满足额定电压的要求。

电流变压器直接连接至 71M6543, 所以受 71M6543 VREF 温度特性的影响。为获得最佳性能,建议采用 差分信号调理电路,如图 29 所示,将 CT 连接至 71M6543。电流变压器也需要温度补偿。CT 铜线绕组直流电阻具有一定的温度系数,使得负载电阻的电压受到温度的影响。此外,负载电阻也具有温度系数。因此,每个 CT 通道都需要针对 71M6543 的 VREF 进行补偿,根据所要求的精度等级,可选择补偿 CT 和负载电阻的温度特性。

MPU 根据检测到的温度计算每个传感器通道采样的增益补偿。Teridian 提供演示例程,实现下面的 *GAIN_ADJx* 补偿方程。所得到的 *GAIN_ADJx* 由 MPU 储存在五个 CE RAM 地址: *GAIN_ADJO-GAIN_ADJ5* (*CE RAM 0x40-0x44*)。演示例程提供了适当的温度补偿方法,但利用片上温度传感器,MPU 固件也可以通过方法实现温度补偿,将采样增益调节结果储存到 CE RAM *GAIN_ADJn 地址*,供 CE 使用。演示程序保持五组独立的 *PPMC* 和 *PPMC* 系数,并根据检测到的温度利用下式计算五个独立的 *GAIN ADJn*:

$$GAIN_ADJx = 16385 + \frac{10 \cdot TEMP_X \cdot PPMC}{2^{14}} + \frac{100 \cdot TEMP_X^2 \cdot PPMC2}{2^{23}}$$

CE 利用 MPU 储存在 CE RAM 中的 $GAIN_ADJn$ 数值调整每个相应的传感器通道, $GAIN_ADJn$ 为 16,384 (即 2^{14})时,对应于单位增益;小于 16,384 时,将对采样值进行衰减;大于 16,384 时,对采样值进行放大。

上式中, $TEMP_X$ 为相对于标称或校准温度的偏差,以 0.1°C 的整数倍表示。式中出现 10x 和 100x 系数 是由于 $TEMP_X$ 的单位为 0.1°C。例如,如果校准(参考)温度为 22°C,实测温度为 27°C,那么 $10*TEMP_X=(27-22)$ x 10=50 (十进制),表示相对于 22°C的偏差为+5°C。演示程序中, $TEMP_X$ 由 MPU 利用 STEMP[10:0]温度传感器读数,采用下式计算得到,并以 0.1°C 为单位。关于利用 STEMP[10:0] 计算以°C 为单位的温度公式,请参考第 55 页 2.5.5 节 71M6543 温度传感器。

表 68 给出了五个 GAIN ADJx 公式输出储存位地址和补偿电压或电流传感器通道。

增益调整输出	CE RAM 地址	传感器通道(引脚名称)	补偿:
		VADC8 (VA)	
GAIN_ADJ0	0x40	VADC9 (VB)	71M6543 的 VREF 和分压电阻
		VADC10 (VC)	
GAIN ADJ1	0x41	IADC0-IADC1	71M6543 的 VREF 和分流器(零相电流)
GAIN_ADJ1	0.41		7 1100343 的 VKEF 和力 机奋(零相电机)
GAIN ADJ2	0x42	IADC2-IADC3	71M6543 的 VREF 和分流器(A 相电流)
GAIN_ADJ2	0,442		71100043 的 VICEI 和分别确(A 相电视)
GAIN ADJ3	0x43	IADC4-IADC5	71M6543 的 VREF 和分流器(B 相电流)
GAIN_AD33	0,43		7 IMO545 的 VKEF 和力 机畚(B 相电机)
GAIN ADJ4	0x44	IADC6-IADC7	71M6543 的 VREF 和分流器(C 相电流)
GAIN_ADJ4	0.444		/ TIVIO343 的 VNEF 和分机命(C 相电机)

表 68. GAIN_ADJx 补偿通道(图 3、图 32、表 2)

演示程序中,温度补偿二阶抛物线的形状由 *PPMC* (1 阶系数)和 *PPMC*2 (2 阶系数)中储存的数值决定,通常 MPU 在初始化时由储存在 EEPROM 的数值设置。

为了禁用演示程序中的温度补偿,将每个 *GAIN_ADJx* 通道的 *PPMC* 和 PPMC2 设为零。使能温度补偿时, *PPMC* 和 *PPMC*2 系数设置为与 VREF 电压基准随温度变化(求和)相匹配的数值,也可以选择包含传感器电路(即电流通道的 CT 和负载电阻,或电压通道的电阻分压网络)的影响。

71M6543F 和 71M6543G 中,所需要的 VREF 补偿系数 *PPMC* 和 *PPMC*2 由可读取的片上非易失熔丝值 计算得到(参见第 4.5.2 节 71M6543F 的温度系数)。温度系数确保温漂达到±40 ppm/°C。

对于 71M6543H 和 71M6543GH (±0.1%计量精度),每个器件的系数可从在工业及温度范围内定义 VREF 特征参数的附加片上熔丝读取计算(参见第 4.5.3 节 71M6543H 的温度系数)。补偿后可以获得±10 ppm/°C 以内的 VREF 电压。

4.6 连接I²C EEPROM

I²C EEPROM 或其它 I²C 兼容器件应连接至 DIO 引脚 SEGDIO2 和 SEGDIO3,如图 33 所示。

SDCK 和 SDATA 信号应该使用大约 10 k Ω 的上拉电阻拉至 V3P3D (确保工作于 BRN 模式)。 $DIO_EEX[1:0]$ (I/O RAM 0x2456[7:6])字段必须设为 01,以便将 DIO 引脚 SEGDIO2 和 SEGDIO3 转换成硬件 I^2C 引脚: SCL 和 SDATA。

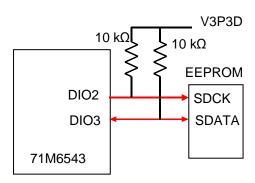


图 33. I²C EEPROM 连接

4.7 连接 3 线EEPROM

μWire EEPROM 和其它兼容器件应连接至 DIO 引脚 SEGDIO2 和 SEGDIO3, 如第 66 页 2.5.11 节 EEPROM 接口所述。

4.8 **UARTO (TX/RX)**

UARTO RX 引脚应由 10kΩ 电阻拉低,另外由 100pF 陶瓷电容保护,如图 34 所示。

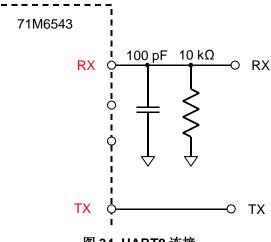


图 34. UARTO 连接

4.9 光接口(UART1)

OPT_TX 和 OPT_RX 引脚可用于普通的串行接口(例如,连接一个 RS_232 收发器),或者用于直接控制光器件(例如,红外二极管和光电晶体管实现 FLAG 接口)。图 35 所示为 UART1 的基本连接。控制字段 OPT TXE (I/O RAM 0x2456[3:2])设为 00 时,OPT TX 引脚有效。

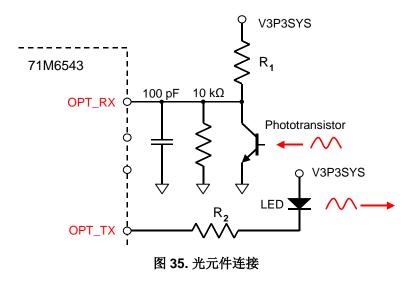
OPT_TX 和 OPT_RX 引脚的极性可分别由配置位 OPT_TXINV (I/O RAM 0x2456[0])和 OPT_RXINV (I/O RAM 0x2457[1])控制翻转。

系统电源供电时,OPT_TX 可以使能 38 kHz 调制功能。BRN 模式下调制功能不可用。*OPT_TXMOD* 位(I/O RAM 0x2456[1])使能调制。占空比由 *OPT_FDC*[1:0] (I/O RAM 0x2457[5:4])控制,可选择 50%、25%、12.5% 和 6.25%占空比。6.25%占空比意味着 OPT_TX 在 6.25%周期内为低电平。OPT_RX 引脚采用数字信号门限。接收调制光信号时,它可能需要一个模拟滤波器。



调制时,光发射器工作电流比标称值高,使其延长光通路距离。

如果希望工作在 BRN 模式,外部元件应连接至 V3P3D。但建议将电流限制为几个 mA。



4.10 连接复位引脚

即使正常工作的电表不需要复位开关,开发时提供一个复位按钮非常有用,如图 36 左侧所示。RESET 信号可源于 V3P3SYS (MSN 模式)、V3P3D (MSN 和 BRN 模式)或 VBAT (所有模式,如果有电池),或者是这些供电电源的组合,取决于具体应用。



对于量产的电表,RESET 引脚应由外部元件保护,如图 36 右侧所示。R1 应在 100 Ω 范围之内,安装在尽量靠近 IC 的位置。

由于 71M6543 产生自身的上电复位, 所以只有测试和开发时才需要复位按钮或电路, 如图 36 所示。

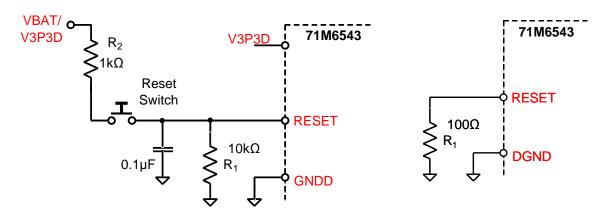


图 36. RESET 引脚外部电路:按钮(左侧)、生产电路(右侧)

4.11 连接仿真器端口

即使不使用仿真器,也应该使用一个对地短路小电容(22pF),用于 EMI 防护,如图 37 所示。成品板应使 ICE E 引脚连接至地。

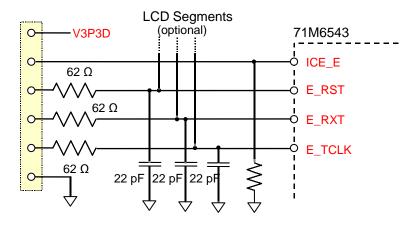


图 37. 仿真器接口的外部电路

4.12 闪存编程

4.12.1 通过ICE端口编程闪存

利用在线仿真器或 Teridian 提供的 FLASH 编程模块(TFP-2),将操作或测试程序载入 FLASH。FLASH 编程采用 E_RST、E_RXTX 和 E_TCLK 引脚。

4.12.2 通过SPI端口编程闪存

通过 SPI 端口可擦除、读和编程 71M6543 的闪存,详细说明请参见第 2.5.12 节。

4.13 MPU演示程序

Teridian 提供的演示用 C 程序(源代码)包括了第 4 章应用信息提及的所有相关 MPU 函数。这些代码作为 71M6543 演示工具包的一部分提供。随演示工具包提供预编程的演示固件,安装在实验演示板上。演示板 有助于快速、有效地评估 IC,同时无需编写固件或提供仿真器(ICE)。

4.14 晶振

71M6543 的振荡器为标准 32.768 kHz 钟表晶振。经过特殊设计的振荡器电路能够处理此类晶振,容许晶体的高阻抗和有限功率处理能力。振荡器功耗非常低,有助于延长 VBAT_RTC 电池的寿命。

电路板布局使 XIN 至 XOUT 的电容最小化,需要的电池电流很小。良好的布局使 XIN 和 XOUT 彼此隔离,并且保持非常短的 XIN、XOUT 走线,远离 LCD 和数字信号。



由于振荡器为自偏压, 所以外部电阻不能连接在晶振上。

4.15 电表校准

Teridian 71M6543 电能表器件安装在电表系统后,必须对其校准。完整的校准包括以下内容:

- 为工厂校准建立参考温度((例如,典型值 22°C)。
- 在参考温度(典型值 22°C)下校准计量电路,即校准电流传感器、分压器和信号调理元件以及内部基准电压(VREF)的误差。
- 利用 RTCA ADJ[7:0] I/O RAM 寄存器(I/O RAM 0x2504)校准振荡器频率。

可利用 CE 的增益和相位调节系数校准计量部分。增益调节用于补偿信号调理使用的元件的容差,尤其是电阻性元件。相位调整用于补偿电流传感器或无功功率引起的相位漂移。

由于 MPU 固件的灵活性,能够实现任意校准方法,例如基于能量或电流和电压进行校准。还可能实现分段校准(取决于电流范围)。

71M6543 支持常见的工业标准校准技术,例如单点(仅限能量)、多点(能量、Vrms、Irms)和自动校准。

Teridian 提供一份校准电子表格文件,以方便校准过程。请联系当地的 Teridian 代表处,索取最新的 71M6543 校准电子表格文件。

5 固件接口

5.1 I/O RAM映射—按功能排序

表 69 和表 70 中,无效位(U)和保留位(R)以浅灰色阴影表示。无效位"U"没有物理存储单元,对其写操作没任何影响,读取时总是返回 0。保留位用 "R"表示,只能写 0。对保留位写入非 0 值,可能会产生负作用,必须避免。非易失位以深灰色阴影表示。如果系统有电池连接至 VBAT 引脚,非易失位在主电源故障期间不会丢失。

表 69 中按地址顺序列出 I/O RAM 位置,方便 MPU 读取(例如,按照验证内容的顺序)。这些 I/O RAM 位置通常仅在启动时更改。表 69 所列地址是表 70 所列地址的替代选择,在本文通篇中都使用表 70 所列地址。例如,EQU[2:0]可在地址 I/O RAM 0x2000[7:5]或地址 I/O RAM 0x2106[7:5]操作。

A4 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0										
名称	地址	第7位	第6位	第5位	第 4 位	第3位	第 2 位	第1位	第0位	
CE6	2000		EQU[2:0]		U	CHOP_E[1:0] RTM_E CE			CE_E	
CE5	2001		U			SL	M_SAMPS[12:8	3]		
CE4	2002			·	SUM_SA	MPS[7:0]				
CE3	2003	U				CE_LCTN[6/5:0]	1			
CE2	2004				PLS_MAXV	WIDTH[7:0]				
CE1	2005				PLS_INTE	CRVAL[7:0]				
CE0	2006	DIFF6_E	DIFF4_E	DIFF2_E	DIFF0_E	RFLY_DIS	FIR_L	EN[1:0]	PLS_INV	
RCE0	2007	СНОР	R[1:0]	RMT6_E	RMT4_E	RMT2_E	TMUXR6[2:0]			
RTMUX	2008	U		TMUXR4[2:0]		U	TMUXR2[2:0]			
FOVRD	2009	U	U	R	U	U	U	U	U	
MUX5	200A		MUX_D	OIV[3:0]		MUX10_SEL				
MUX4	200B		MUXS	P_SEL		MUX8_SEL				
MUX3	200C		MUX	7_SEL		MUX6_SEL				
MUX2	200D		MUX:	5_SEL		MUX4_SEL				
MUX1	200E		MUX.	B_SEL		MUX2_SEL				
MUX0	200F		MUX	l_SEL			MUX	0_SEL		
TEMP	2010	TEMP_BSEL	TEMP_PWR	OSC_COMP	TEMP_BAT	TBYTE_BUSY		TEMP_PER[2:0]	7	
LCD0	2011	LCD_E		LCD_MODE[2:0]			LCD_Y	LCD_C	LK[1:0]	
LCD1	2012	LCD_VM0	ODE[1:0]			LCD_BLNKMAP23[5:0]				
LCD2	2013	LCD_BAT	R LCD_BLNKMAP22[5:0]							
LCD_MAP6	2014		LCD_MAP[55:48]							

表 69. I/O RAM 映射—按功能排序,基本配置

名称	地址	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位	
LCD_MAP5	2015		LCD_MAP[47:40]							
LCD_MAP4	2016				LCD_MA	P[39:32]				
LCD_MAP3	2017				LCD_MA	NP[31:24]				
LCD_MAP2	2018				LCD_MA	P[23:16]				
LCD_MAP1	2019				LCD_M	AP[15:8]				
LCD_MAP0	201A				LCD_M	AP[7:0]				
DIO_R5	201B	U	U	U	U	U		DIO_RPB[2:0]		
DIO_R4	201C	U		DIO_R11[2:0]		U	DIO_R10[2:0]			
DIO_R3	201D	U		DIO_R9[2:0]		U	DIO_R8[2:0]			
DIO_R2	201E	U		DIO_R7[2:0]		U	DIO_R6[2:0]			
DIO_R1	201F	U		DIO_R5[2:0]		U	DIO_R4[2:0]			
DIO_R0	2020	U		DIO_R3[2:0]		U	DIO_R2[2:0]			
DIO0	2021	DIO_EI	EX[1:0]	U	U	OPT_T	XE[1:0]	OPT_TXMOD	OPT_TXINV	
DIO1	2022	DIO_PW	DIO_PV	OPT_F	DC[1:0]	U	OPT_RXDIS	OPT_RXINV	OPT_BB	
DIO2	2023	DIO_PX	DIO_PY	U	U	U	U	U	U	
INT1_E	2024	EX_EEX	EX_XPULSE	EX_YPULSE	EX_RTCT	U	EX_RTC1M	EX_RTC1S	EX_XFER	
INT2_E	2025	EX_SPI	EX_WPULSE							
WAKE_E	2026				EW_RX	EW_PB	EW_DIO4	EW_DIO52	EW_DIO55	
SFMM	2080		SFMM[7:0]*							
SFMS	2081				SFMS	[[7:0]*				

注:

*SFMM 和 SFMS 只能通过 SPI 从端口访问。详情请参见 2.5.1.1 闪存模式。

表 70 列出了可能需要频繁访问的位和寄存器。保留位的灰色背景较浅,非易失位的灰色背景较深。

表 70. I/O RAM 映射—按功能排序

名称	地址	第7位	———————— 第 6 位	第 5 位	第4位	第3位	—————— 第 2 位	第1位	第0位
CE 和 ADC					, ,			1	
MUX5	2100		MUX_L	0IV[3:0]		MUX10_SEL[3:0]			
MUX4	2101		MUX9_S				MUX8_S		
MUX3	2102		MUX7_S				MUX6_S		
MUX2	2103		MUX5_S				MUX4_S		
MUX1	2104		MUX3_S				MUX2_S		
MUX0	2105		MUX1_S				MUX0_S		
CE6	2106		EQU[2:0]	[:::]	U	CHOP_E[1:0]	RTM		CE_E
CE5	2107		$\frac{\mathcal{Z}^{I_{I}}}{U}$		-		M_SAMPS[12:8		
CE4	2108				SUM SA	MPS[7:0]			
CE3	2109	U		CE_LC		43G/GH), CE_LC	FN[5:0] (71M65	(43F/H)	
CE2	210A			_	PLS_MAXV	WIDTH[7:0]	· ·	,	
CE1	210B				PLS_INTE	ERVAL[7:0]			
CE0	210C	DIFF6_E	DIFF4_E	DIFF2_E	DIFF0_E	RFLY_DIS	FIR_LE	EN[1:0]	PLS_INV
RTM0	210D	U	U	U	U	U	U	RTM	0[9:8]
RTM0	210E				RTM	0[7:0]			
RTM1	210F				RTM	1[7:0]			
RTM2	2110				RTM	2[7:0]			
RTM3	2111				RTM.	3[7:0]			
时钟发生									
CKGN	2200	U	U	ADC_DIV	PLL_FAST	RESET		MPU_DIV[2:0]	
VREF 调节	熔丝器件								
TRIMT	2309				TRIM	T[7:0]			
LCD/DIO									
LCD0	2400	LCD_E	1	LCD_MODE[2:0]]	LCD_ALLCOM	LCD_Y	LCD_C	CLK[1:0]
LCD1	2401	LCD_VM	ODE[1:0]			LCD_BLNKM	IAP23[5:0]		
LCD2	2402	LCD_BAT	R			LCD_BLNKM	IAP22[5:0]		
LCD_MAP6	2405				LCD_MA	AP[55:48]			
LCD_MAP5	2406				LCD_MA	AP[47:40]			
LCD_MAP4	2407				LCD_MA	AP[39:32]			
LCD_MAP3	2408				LCD_MA	AP[31:24]			

名称	地址	第7位	第6位	第5位	第 4 位	第3位	第2位	第1位	第0位					
LCD_MAP2	2409		LCD_MAP[23:16]											
LCD_MAP1	240A				LCD_M	AP[15:8]								
LCD_MAP0	240B				LCD_M	[AP[7:0]								
LCD4	240C	U	U	U	U	U	LCD_RST	LCD_BLANK	LCD_ON					
LCD_DAC	240D	U	U	U			LCD_DAC[4:0]							
SEGDIO0	2410	U	U			LCD_SE	G0[5:0]							
		U	U											
SEGDIO15	241F	U	U			LCD_SE	G15[5:0]							
SEGDIO16	2420	U	U			LCD_SEGI	DIO16[5:0]							
		U	U											
SEGDIO45	243D	U	U			LCD_SEGI	DIO45[5:0]							
SEGDIO46	243E	U	U			LCD_SE	G46[5:0]							
		U	U											
SEGDIO50	2442	U	U LCD_SEG50[5:0]											
SEGDIO51	2443	U	U LCD_SEGDIO51[5:0]											
		U	U											
SEGDIO55	2447	U	U			LCD_SEGI	DIO55[5:0]							
DIO_R5	2450	U	R	R	R	U DIO_RPB[2:0]								
DIO_R4	2451	U		DIO_R11[2:0]		U		DIO_R10[2:0]						
DIO_R3	2452	U		DIO_R9[2:0]		U	DIO_R8[2:0]							
DIO_R2	2453	U		DIO_R7[2:0]		U	DIO_R6[2:0]							
DIO_R1	2454	U		DIO_R5[2:0]		U	DIO_R4[2:0]							
DIO_R0	2455	U		DIO_R3[2:0]		U		DIO_R2[2:0]						
DIO0	2456	DIO_EI	EX[1:0]	U	U	OPT_T	XE[1:0]	OPT_TXMOD	OPT_TXINV					
DIO1	2457	DIO_PW	DIO_PV	OPT_FI	DC[1:0]	U	OPT_RXDIS	OPT_RXINV	OPT_BB					
DIO2	2458	DIO_PX	DIO_PY	U	U	U	U	U	U					
NV BITS														
SPARENV	2500	U	U	U	U		R							
FOVRD	2501	U	U	R	U	U	U	U	U					
TMUX	2502	U	U			TMUZ	X[5:0]							
TMUX2	2503	U	U	U			TMUX2[4:0]							
RTC1	2504	U				RTCA_ADJ[6:0]								
71M6xx3 £	接口													

名称	地址	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位				
REMOTE2	2602	RMT_RD[15:8]											
REMOTE1	2603				RMT_R	PD[7:0]							
RBITS													
INT1_E	2700	EX_EEX	EX_XPULSE	EX_YPULSE	EX_RTCT	U	EX_RTC1M	EX_RTC1S	EX_XFER				
INT2_E	2701	EX_SPI	EX_WPULSE	EX_VPULSE	U	U	U	U	U				
SECURE	2702		FLSH_UNI	LOCK[3:0]		R	FLSH_RDE	FLSH_WRE	R				
Analog0	2704	VREF_CAL	VREF_DIS	PRE_E	ADC_E	BCURR		SPARE[2:0]					
VERSION	2706				VERSIC	DN[7:0]							
INTBITS	2707	U	INT6	INT5	INT4	INT3	INT2	INT1	INT0				
FLAG0	SFR E8	IE_EEX	IE_XPULSE	IE_YPULSE	IE_RTCT	U	IE_RTC1M	IE_RTC1S	IE_XFER				
FLAG1	SFR F8	IE_SPI	IE_WPULSE	IE_VPULSE	U	U	U	U	PB_STATE				
STAT	SFR F9	U	U	U	PLL_OK	U		VSTAT[2:0]					
REMOTE0	SFR FC	U	PERR_RD PERR_WR RCMD[4:0]										
SPI1	SFR FD	SPI_CMD[7:0]											
SPI0	2708	SPI_STAT[7:0]											
RCE0	2709	СНОР	R[1:0]	RMT6_E	RMT4_E	RMT2_E		TMUXR6[2:0]					
RTMUX	270A	U		TMUXR4[2:0]		U	TMUXR2[2:0]						
INFO_PG	270B	U	U	U	U	U	U	U	INFO_PG				
DIO3	270C	U	U	PORT_E	SPI_E	SPI_SAFE	U	U	U				
NV RAM ₹	TRTC												
NVRAMxx	2800- 287F			NVRA	M[0] – NVRAM[[7F] – Direct Ad	ccess						
WAKE	2880				WAKE_T	MR[7:0]							
STEMP1	2881				STEMI	P[10:3]							
STEMP0	2882		STEMP[2:0]		U	U	U	U	U				
BSENSE	2885				BSENS	E[7:0]							
LKPADDR	2887	LKPAUTOI				LKPADDR[6:0]							
LKPDATA	2888			LKPDAT[7:0]									
LKPCTRL	2889	U	U	U	U	U	U	LKP_RD	LKP_WR				
RTC0	2890	RTC_WR	RTC_RD	U	RTC_FAIL	U	U	U	U				
RTC2	2892				RTC_SB	SC[7:0]							
RTC3	2893	U	U			RTC_SI	EC[5:0]						
RTC4	2894	U	U			RTC_M	IN[5:0]						

名称	地址	第7位	第6位	第5位	第4位	第3位	第2位	第1位	第0位				
RTC5	2895	U	U	U		RTC_HR[4:0]							
RTC6	2896	U	U	U	U	U		RTC_DAY[2:0]					
RTC7	2897	U U U RTC_DATE[4:0]											
RTC8	2898	U	U U U RTC_MO[3:0]										
RTC9	2899	RTC_YR[7:0]											
RTC10	289B	U	U	U	U	U		RTC_P[16:14]					
RTC11	289C	RTC_P[13:6]											
RTC12	289D	RTC_P[5:0] RTC_Q[1:0]											
RTC13	289E	U	U			RTC_TM	IIN[5:0]						
RTC14	289F	U	U	U			RTC_THR[4:0]						
TEMP	28A0	TEMP_BSEL	TEMP_PWR	OSC_COMP	TEMP_BAT	TBYTE_BUSY	7	TEMP_PER[2:0]					
WF1	28B0	WF_CSTART	WF_RST	WF_RSTBIT	WF_OVF	WF_ERST	WF_BADVDD	U	U				
WF2	28B1	U	U	WF_TMR	WF_RX	WF_PB	WF_DIO4	WF_DIO52	WF_DIO55				
MISC	28B2	SLEEP	LCD_ONLY	WAKE_ARM	U	U	U	U	U				
WAKE_E	28B3	U	U	U	EW_RX	EW_PB	EW_DIO4	EW_DIO52	EW_DIO55				
WDRST	28B4	WD_RST	TEMP_START	U	U U		U	U	U				
MPU 端口													
PORT3	SFR B0		DIO_DII	R[15:12]			DIO[1	5:12]					
PORT2	SFR A0		DIO_DI	R[11:8]			DIO[1	11:8]					
PORT1	SFR 90		DIO_D	IR[7:4]			DIO[7:4]					
PORT0	SFR 80		DIO_D	IR[3:0]			DIO[3:0]					
FLASH													
ERASE	SFR 94				FLSH_EF	RASE[7:0]							
FLSHCTL	SFR B2	PREBOOT	SECURE	U	U	FLSH_PEND	FLSH_PSTWR	FLSH_MEEN	FLSH_PWE				
FL_BANK	SFR B6	U	U	U	U	U	U	FL_BA	VK[1:0]				
PGADR	SFR B7			FLSH_PC	SADR[5:0]			U	U				
r ² C	,												
EEDATA	SFR 9E				EEDAT								
EECTRL	SFR 9F				EECTH	RL[7:0]							

5.2 I/O RAM映射—按字母排序

表 71 按字母顺序列出了 I/O RAM 和寄存器。

可写位(在方向栏中用 W 表示)由 MPU 写入配置 RAM。通常情况下,典型应用由 MPU 从 FLASH 复制到配置 RAM。部分更常用的操作位被映射至 MPU SFR 存储器空间。其它位被映射至地址空间 0x2XXX。MPU 读取 R (读)位。复位和唤醒栏分别说明复位和唤醒时的默认值。"-"代表该位为只读或由 NV 电源供电,不进行初始化。读取"只写位"时返回 0。

灰色阴影部分为非易失(电池供电)。

表 71. I/O RAM 映射—按字母排序

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明					
ADC_E	2704[4]	0	0	R/W	使能 ADC 和 VREF。禁用时,减小偏置电流。					
ADC_DIV	2200[5]	0	0	R/W	ADC_DIV 控制 ADC 和 FIR 时钟的速率。 ADC_DIV 设置决定 MCK 是被 4 或 8 除: 0 = MCK/4 1 = MCK/8 产生的 ADC 和 FIR 时钟如下所示。 PLL_FAST = 0 PLL_FAST = 1 MCK 6.291456 MHz 19.660800 MHz ADC_DIV = 0 1.572864 MHz 4.9152 MHz ADC_DIV = 1 0.786432 MHz 2.4576 MHz					
BCURR	2704[3]	0	0	R/W	将 100μA 负载连接至 <i>TEMP_BSEL</i> 所选的电池。					
BSENSE[7:0]	2885[7:0]	-	_	R	电池测量结果。 参见第 57 页第 2.5.7 节 71M6543 电池监测器。					
CE_E	2106[0]	0	0	R/W	CE 使能。					
CE_LCTN[6:0]	2109[6:0]	31	31	R/W	CE 程序地址,CE 程序的起始地址为 1024* <i>CE_LCTN</i> 。 (<i>CE_LCTN[6:0]</i> , 2109[6:0],用于 71M6543G, 71M6543GH) (<i>CE_LCTN[5:0]</i> , 2109[5:0],用于 71M6543F, 71M6543H)					
CHIP_ID[15:8] CHIP_ID[7:0]	2300[7:0] 2301[7:0]	0	0	R R	这些字节包含芯片标识,如下所示。					

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明					
CHOP_E[1:0]	2106[3:2]	0	0	R/W	使能带隙基准的斩波功能。在 MUXSYNC 信号的上升沿,内部根据 <i>CHOP_E[1:0]</i> 数值更改 CHOP: 00 = 切换 ¹ 01 = 正极性 10 = 反极性 11 = 切换 ¹ 累积周期的最后 mux sync 沿除外。					
CHOPR[1:0]	2709[7:6]	00	00	R/W	用于远端传感器的 CHOP 设置。 00 = 自动斩波。每个复用帧变化。 01 = 正 10 = 负 11 = 自动斩波。同 00。					
DIFF0_E	210C[4]	0	0	R/W	使能 IADC0-IADC1,差分配置。					
DIFF2_E	210C[5]	0	0	R/W	使能 IADC2-IADC3,差分配置。					
DIFF4_E	210C[6]	0	0	R/W	使能 IADC4-IADC5,差分配置。					
DIFF6_E	210C[7]	0	0	R/W	使能 IADC6-IADC7,差分配置。					
DIO_R2[2:0] DIO_R3[2:0] DIO_R4[2:0] DIO_R5[2:0] DIO_R6[2:0] DIO_R7[2:0] DIO_R8[2:0] DIO_R9[2:0] DIO_R10[2:0] DIO_RPB[2:0]	2455[2:0] 2455[6:4] 2454[2:0] 2454[6:4] 2453[2:0] 2453[6:4] 2452[2:0] 2452[6:4] 2451[2:0] 2451[6:4] 2450[2:0]	0 0 0 0 0 0 0	_	R/W	将 PB 和专用 I/O 引脚 DIO2 至 DIO11 连接至内源,下方的 MULTIPLE 栏制定如何组合。 DIO_Rx 资源 0 无 1 保留 2 T0 (定时器 0 时钟或选通) 3 T1 (定时器 1 时钟或选通) 4 IO 中断(int0) 5 IO 中断(int1)	MULTIPLE OR OR OR OR OR OR OR OR	多个输入连接至相同			
DIO_DIR[15:12] DIO_DIR[11:8] DIO_DIR[7:4] DIO_DIR[3:0]	SFR B0[7:4] SFR A0[7:4] SFR 90[7:4] SFR 80[7:4]	F	F	R/W	设置前 16 个 DIO 引脚的方向,1 表示输出。如 关于 DIO0 和 DIO1 的特殊选项,请参见 DIO_E SEGDIO3 的特殊选项,请参见 DIO_EEX X[1:0] SEGDIOx[1]设置。参见 PORT_E 避免上电毛刺	PV和 <i>DIO_PW</i> J。注意,DIO1	。关于 SEGDIO2 和			
DIO[15:12] DIO[11:8] DIO[7:4] DIO[3:0]	SFR B0[3:0] SFR A0[3:0] SFR 90[3:0] SFR 80[3:0]	F	F	R/W	设置前 16 个 DIO 引脚的数值,配置为 LCD 的置为输出的引脚的数据,配置为 LCD 或输入的上的引脚数据由 SEGDIOx[0] 设置。					

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明	说明								
						SEGDI								SEGDIO2 变为 MAP[3]清除时,该
					DIO_E	DIO_EEX[1:0] 功能								
DIO_EEX[1:0]	2456[7:6]	0	-	R/W	0	0	2	禁用 EEPI	ROM	1接□]			
					0	1	2	2线 EEPF	ROM	接口				
					1	0		3线 EEPF						
					1	1		3线 EEPF 脚。	ROM	接口	,带独	立的 DO (SE	GDIO3)和 D	이 (SEGDIO8)引
DIO_PV	2457[6]	0	ı	R/W	如果 LCD	_MAP[[1] =	0,使 VP	ULS	E在	引脚 SE	GDIO1 输出	0	
DIO_PW	2457[7]	0	-	R/W	如果 LCD	_MAP[[0] =	0,使 VA	RPU	JLSE	在引脚	SEGDIO1 箱	计出。	
DIO_PX	2458[7]	0	-	R/W	如果 LCD	_MAP[[6] =	0,使 XP	ULS	E在	引脚 SE	GDIO6 输出	0	
DIO_PY	2458[6]	0	ı	R/W	如果 LCD_MAP[7] = 0,使 YPULSE 在引脚 SEGDIO7 输出。									
EEDATA[7:0]	SFR 9E	0	0	R/W	串行 EEP	ROM	接口	数据。						
	01 SFR 9F	0			串行 EEPROM 接口控制。									
EECTRI (7.0)			0	R/W	状态 位	名和	弥	读/写	复状		极性	说明		
EECTRL[7:0]	SFR 9F		0		17/ / /	7	ERRC	OR .			命令后为1。	1		
					6	BUSY		R	C)	正		线忙时为1。	
					5	RX_A	CK	R	1	1	正	1表示 EEF	PROM 发送了	了 ACK 位。
					指定计量	是公式。	0							
					EQU[2	:0]		说明		器	件 0	器件 1	器件 2	推荐 MUX 序 列
					3	2		ement, 4V ∮ Del□a	Ν,	VA([I□-IB)/	0	VC IC	IA VA IB □B □C VC
EQU[2:0]	2106[7:5]	0	0	R/W	4		3	ement, 4V Βφ Wye	,		A(IA- B)/2	VB(IC- IB)/2	0	IA VA IB V□ I□ VC
					5*	;		ement, 4V 3φ □ye	Ν,	V	'A IA	VB IB	VC □C	IA □A IB□VB IC□V
					注: *所提供的 系。	勺 CE 代	八码来	自于公式 5	,如氰	需公式	式3和4 行	导出的 CE 代码	3,请与当地的	为Teridian 人员联

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明		
EX_XFER EX_RTC1S EX_RTC1M EX_RTCT EX_SPI EX_EEX EX_YPULSE EX_YPULSE EX_WPULSE EX_VPULSE EX_VPULSE	2700[0] 2700[1] 2700[2] 2700[3] 2701[7] 2700[7] 2700[6] 2700[5] 2701[6] 2701[5]	0	0	R/W	中断使能位。这些位使能 XFER_BUSY、RTC_1SEC 等。注意,如果这些中断位中某一项被使能,其对应的 8051 EX 使能位也应该置位。详情参见第 2.4.9 节中断。		
EW_DIO4	28B3[2]	0	١	R/W	连接 SEGDIO4 至 WAKE 逻辑,允许 SEGDIO4 上升沿唤醒器件。DIO4 配置为数字输入时,该位无效。		
EW_DIO52	28B3[1]	0	-	R/W	连接 SEGDIO52 至 WAKE 逻辑,允许 SEGDIO52 上升沿唤醒器件。SEGDIO52 配置为数字输入时,该位无效。		
EW_DIO55	28B3[0]	0	-	R/W	连接 SEGDIO55 至 WAKE 逻辑控制,允许 SEGDIO55 上升沿唤醒器件。 EGDIO55 配置为数字输入时,该位无效。		
EW_PB	28B3[3]	0	-	R/W	连接 PB 至 WAKE 逻辑控制,允许 PB 上升沿唤醒器件。PB 由硬件配置为输入,软件无法修改。		
EW_RX	28B3[4]	0	ı	R/W	连接 RX 至 WAKE 逻辑控制,允许 RX 上升沿唤醒器件。去抖信息请参见第 3.4 节定时器唤醒。		
FIR_LEN[1:0]	210C[2:1]	0	0	R/W	ADC 采样周期的 FIR 滤波器长度。 PLL_FAST = 1:		

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明					
FL_BANK[1:0]	SFR B6[1:0]	01	01	R/W	囚存组选择(71M6543G和 71M6543GH) 71M6543G/GH 的程序存储器由固定的 32KB 低地址字节 (0x0000 至 0x7FFF)和 32KB 高地址字节(0x8000 至 0xFFFF)组成。I/O RAM 寄存器 FL_BANK 用于将四组 32KB 存储器之一切换到 0x8000 至 0xFFFF 地址范围。注意,当 FL_BANK = 0时,高字节存储区与低字节存储区相同。 FL_BANK[1:0] 低字节存储区地址范围 (0x0000-0x7FFF) 00 0x0000-0x7FFF 01 0x0000-0x7FFF 01 0x0000-0x7FFF 0x10000-0x17FFF 11 0x0000-0x7FFF 0x18000-0x1FFFF					
FLSH_ERASE[7:0]	SFR 94[7:0]	0	0	W	闪存擦除启动 FLSH_ERASE 用于发起 FLASH 整体擦除或 FLASH 页擦除。为了启用相应的擦除过程,FLSH_ERASE 需要特定的命令字。(默认 = 0x00) 0x55 - 发起 FLASH 页擦除。之前必须向 FLSH_PGADR[5:0] (SFR 0xB7[7:2])写入 要擦除的页。 0xAA - 发起 FLASH 整体擦除。之前必须向 FLSH_MEEN (SFR 0xB2) 写 1,调试 (CC)端口必须使能。 向 FLSH_ERASE 写其它任意命令字均无效。					
FLSH_MEEN	SFR B2[1]	0	0	W	整体擦除使能 0 = 禁用整体擦除(默认)。 1 = 使能整体擦除。 必须针对每次新整体擦除重写。					
FLSH_PEND	SFR B2[3]	0	0	R	表示写 FLASH 被挂起。后续的 FLASH 写操作被忽略。					
FLSH_PGADR[5:0]	SFR B7[7:2]	0	0	W	<u>闪存页擦除地址</u> 页擦除期间被擦除的 FLASH 页地址(页 0 至 63)。(默认= 0x00)。 必须针对每次新页擦除重写。					
FLSH_PSTWR	SFR B2[2]	0	0	R/W	使能定时写 FLASH。为 1 时,如果 $CE_E = 1$,写 FLASH 请求储存到一个单位深度的 FIFO 中,等待 CE_BUSY 变低时执行。可通过读 $FLSH_PEND$ 确定此 FIFO 的状态。如果 $FLSH_PSTWR = 0$ 或如果 $CE_E = 0$,立即执行写 FLASH 操作。					

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明			
FLSH_PWE	SFR B2[0]	0	0	R/W	程序写使能 0 = MOVX 命令针对外部 RAM 空间,常规工作(默认)。 1 = MOVX @DPTR,A 将 A 移至外部程序空间(Flash) @ DPTR。 该位在每个字节写入 FLASH 后自动复位。使能中断时,禁止该位写操作。			
FLSH_RDE	2702[2]	_	-	R	表示 FLASH 通过 ICE 或 SPI 接口读取。FLSH_RDE = (!SECURE)。			
FLSH_UNLOCK[3:0]	2702[7:4]	0	0	R/W	必须为2才能允许FLASH更改,更多详情参见FLASH安全说明。			
FLSH_WRE	2702[1]	_	_	R	表示 FLASH 通过 ICE 或 SPI 接口写入。			
IE_XFER IE_RTC1S IE_RTC1M IE_RTCT IE_SPI IE_EEX IE_XPULSE IE_YPULSE IE_WPULSE IE_VPULSE IE_VPULSE	SFR E8[0] SFR E8[1] SFR E8[2] SFR E8[3] SFR F8[7] SFR E8[7] SFR E8[6] SFR E8[5] SFR F8[4] SFR F8[3]	0	0	R/W	用于中断 2 和 6 的中断标识。这些标识监测 int6 和 int2 中断源(MPU 核心的外部中断)。这些标识由硬件置位,必须由软件清除。 <i>IEX2 (SFR 0xC0[1])</i> 和 <i>IEX6 (SFR 0xC0[5])</i> 中断标识由 MPU 内核响应中断后自动清除。SFR <i>E8</i> 和 SFR <i>F8</i> 必须进行字节清除,即向它们对应的位写 0、并向其它非清零位写 1 清除。			
INTBITS	2707[6:0]	-	-	R	中断输入。MPU 可读取这些位,检查外部中断 INTO~INT6 的输入。这些位没有任何存储器,主要用于调试。			
LCD_ALLCOM	2400[3]	0	_	R/W	将 SEG/COM 位配置为 COM。不影响 LCD_MAP 位为 0 的引脚。			
LCD_BAT	2402[7]	0	-	R/W	任何模式下, VBAT 为 LCD 供电。			
LCD_BLNKMAP23[5:0] LCD_BLNKMAP22[5:0]	2401[5:0] 2402[5:0]	0	-	R/W	连接至 SEG23 和 SEG22 的段闪烁控制,1 表示"闪烁"。最高有效位对应 COM5,最低有效位对应 COM0。			
LCD_CLK[1:0]	2400[1:0]	0	-	R/W	设置 LCD 时钟频率,注意: $f_{XTAL} = 32768Hz$			

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明				
LCD_DAC[4:0]	240D[4:0]	0	-	R/W	LCD 对比度调节 DAC。该 DAC 控制 VLCD 电压,输出范围为 2.65V 至 5.3V。 VLCD 电压为: VLCD = 2.65 + 2.65 * <i>LCD_DAC[4:0]/</i> 31 所以,DAC 的 LSB 为 85.5mV。最大 DAC 输出电压受限于 V3P3SYS、VBAT,以及 <i>LCD_BSTE</i> 是否等于 1。				
LCD_E	2400[7]	0	ı	R/W	使能 LCD 显示。禁用时,VLC2、VLC1、VLC0、COM 和 SEG (如果其 LCD_MAP 位为 1)均为 GND 电位。				
LCD_MAP[55:48] LCD_MAP[47:40] LCD_MAP[39:32] LCD_MAP[31:24] LCD_MAP[23:16] LCD_MAP[15:8] LCD_MAP[7:0]	2405[7:0] 2406[7:0] 2407[7:0] 2408[7:0] 2409[7:0] 240A[7:0] 240B[7:0]	0 0 0 0 0	111111	R/W R/W R/W R/W R/W R/W	使能 SEGDIO 引脚的 LCD 段驱动器模式。 <i>LCD_MAP[50:48]</i> 位为 0 时,SEG48 至 SEG50 只能配置成内部上拉输入。此外,注意,SEG48 至 SEG50 与在线仿真器信号复用。ICE_E 引脚为高电平时,ICE 接口使能,SEG48 至 SEG50 分别为 E_RXTX、E_TCLK 和 E_RST。				
LCD_MODE[2:0]	2400[6:4]	0	- 1	R/W	选择 LCD 偏压和复用模式。				
LCD_ON LCD_BLANK	240C[0] 240C[1]	0		R/W R/W	点亮或关闭所有 LCD_MAP 配置成的 LCD 段,不会改变 LCD 数据。如果两位均被置位,LCD 显示全亮。				
LCD_ONLY	28B2[6]	0	0	W	将 IC 置于休眠模式,但 LCD 显示仍然有效。如果系统电源供电,则忽略。唤醒定时器超时、特定 DIO 引脚变高或系统电源恢复时唤醒(参考第 3.2 节电池模式)。				
LCD_RST	240C[2]	0	-	R/W	清除 LCD 数据的所有位。这些位影响被配置为 LCD 驱动器的 SEGDIO 引脚,该位不自动清除。				
LCD_SEG0[5:0] 至 LCD_SEG15[5:0]	2410[5:0]至 241F[5:0]	0	_	R/W	SEG0 至 SEG15 的 SEG 数据。这些引脚的 DIO 数据位于 SFR 空间。				
LCD_SEGDIO16[5:0]至 LCD_SEGDIO45[5:0]	2420[5:0]至 243D[5:0]	0	_	R/W	SEGDIO16 至 SEGDIO45 的 SEG 和 DIO 数据。如果配置为 DIO,第 1 位为方向 (1 为输出,0 为输入),第 0 位为数据,其它位忽略。				

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明				
LCD_SEG46[5:0]至 LCD_SEG50[5:0]	243E[5:0] 至 2442[5:0]	0	ı	R/W	SEG46 至 SEG50 的 SEG 数据,这些引脚不可配置为 DIO。SEG47 和 SEG46 分别对应 TMUXOUT 和 TMUXOUT2 引脚。				
LCD_SEGDIO51[5:0]至 LCD_SEGDIO55[5:0]	2443[5:0] 至 2447[5:0]	0	-	R/W	SEGDIO51 至 SEGDIO55 的 SEG 和 DIO 数据。如果配置为 DIO,第 1 位为方向 (1 为输出,0 为输入),第 0 位为数据,其它位忽略。				
					指定 VLCD 来源,V3P3L 的定义请参见第 2.5.10.3 节。. LCD VMODE 说明				
					LCD_VMODE 说明 11 外部 VLCD				
LCD_VMODE[1:0]	2401[7:6]	00	00	R/W	10 使能 LCD 升压和 LCD DAC				
					01 使能 LCD DAC				
					00 无升压和 DAC,VLCD=V3P3L				
LCD_Y	2400[2]	0		R/W	LCD 闪烁频率(如果禁用闪烁则忽略)。1 = 1 Hz, 0 = 0.5 Hz				
LKPADDR[6:0]	2887[6:0]	0	0	R/W	RTC 查找 RAM 的读/写地址。				
ERITIDDIQU.01	2007 [0.0]	-		10,00	地址自动递增使能。置位时, <i>LKPADDR[6:0]在 LKP_RD</i> 或 <i>LKP_WR</i> 每次产生脉				
LKPAUTOI	2887[7]	0	0	R/W	地址自初速增便能。直位时,LKPADDR[6:0]在 LKP_RD 或 LKP_WR 每次产生脉冲时自动递增。递增地址可从 LKPADDR 读取。				
LKPDAT[7:0]	2888[7:0]	0	0	R/W	RTC 查找 RAM 的读/写数据。				
LKP_RD LKP_WR	2889[1] 2889[0]	0	0	R/W R/W	用于 RTC 查找 RAM 读和写的选通位。置位时, <i>LKPADDR[6:0]</i> 字段和 <i>LKPDAT</i> 寄存器用于读或写操作。选通位置位时,将保持到完成操作,然后清除选通;如果 <i>LKPAUTOI</i> 置位,则递增 <i>LKPADDR[6:0]</i> 。				
MPU_DIV[2:0]	2200[2:0]	0	0	R/W	MPU 时钟频率为: MPU 速率 = MCK 速率 * 2 ^{-(2+MPU_DIV[2:0])} . MPU_DIV[2:0]的最大值为 4。基于 PLL_FAST 位和 MPU_DIV[2:0]的默认值,上电 MPU 速率为 6.29MHz / 4 = 1.5725MHz。PLL_FAST = 1 时,最小 MPU 时钟速率 为 38.4kHz。				
MUX0_SEL[3:0]	2105[3:0]	0	0	R/W	选择在时隙 0 转换的 ADC 输入。				
MUX1_SEL[3:0]	2105[7:4]	0	0	R/W	选择在时隙 1 转换的 ADC 输入。				
MUX2_SEL[3:0]	2104[3:0]	0	0	R/W	选择在时隙 2 转换的 ADC 输入。				
MUX3_SEL[3:0]	2104[7:4]	0	0	R/W	选择在时隙 3 转换的 ADC 输入。				
MUX4_SEL[3:0]	2103[3:0]	0	0	R/W	选择在时隙 4 转换的 ADC 输入。				
MUX5_SEL[3:0]	2103[7:4]	0	0	R/W	选择在时隙 5 转换的 ADC 输入。				
MUX6_SEL[3:0]	2102[3:0]	0	0	R/W	选择在时隙 6 转换的 ADC 输入。				

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明				
MUX7_SEL[3:0]	2102[7:4]	0	0	R/W	选择在时隙 7 转换的 ADC 输入。				
MUX8_SEL[3:0]	2101[3:0]	0	0	R/W	选择在时隙 8 转换的 ADC 输入。				
MUX9_SEL[3:0]	2101[7:4]	0	0	R/W	选择在时隙 9 转换的 ADC 输入。				
MUX10_SEL[3:0]	2100[3:0]	0	0	R/W	选择在时隙 10 转换的 ADC 输入。				
MUX_DIV[3:0]	2100[7:4]	0	0	R/W	MUX_DIV[3:0]为每个复用帧内 ADC 时隙的数量。最大时隙数量为 11。				
OPT_BB	2457[0]	0	-	R/W	将光端口的输入配置为 DIO 引脚,使其能够为位脉冲。这种情况下,DIO5 变为第三个高速 UART。请参见第 57 页第 2.5.9 节 UART 和光接口下的" 位脉冲,光接 口 UART (第三个 UART)"。				
OPT_FDC[1:0]	2457[5:4]	0	ı	R/W	选择 OPT_TX 调制占空比。				
OPT_RXDIS	2457[2]	0	-	R/W	OPT_RX 可配置为光 UART 的输入或 SEGDIO55。 OPT_RXDIS = 0 且 LCD_MAP[55] = 0:OPT_RX OPT_RXDIS = 1 且 LCD_MAP[55] = 0: DIO55 OPT_RXDIS = 0 且 LCD_MAP[55] = 1: SEG55 OPT_RXDIS = 1 且 LCD_MAP[55] = 1: SEG55				
OPT_RXINV	2457[1]	0	ı	R/W	为 1 时,反转 OPT_RX 比较器的结果。仅影响 UART 输入。OPT_RX 作为 DIO输入时,该位无效。				
OPT_TXE [1,0]	2456[3:2]	00	-	R/W	配置 OPT_TX 输出引脚。 如果 <i>LCD_MAP[51]</i> = 0: 00 = DIO51, 01 = OPT_TX, 10 = WPULSE, 11 = VPULSE 如果 <i>LCD_MAP[51]</i> = 1: xx = SEG51				
OPT_TXINV	2456[0]	0	_	R/W	为 1 时反转 OPT_TX。反转发生在调制之前。				
OPT_TXMOD	2456[1]	0	_	R/W	使能 OPT_TX 调制。 <i>OPT_TXMOD</i> 置位时,OPT_TX 被调制。 <i>在 OPT_TXINV</i> 造成的任意反转之后,应用调制。				
OSC_COMP	28A0[5]	0	_	R/W	使能 RTC_P[16:0]和 RTC_Q [1:0]在每次温度测量时被自动更新。				

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明		
PB_STATE	SFR F8[0]	0	0	R	去抖后的 PB 引脚状态。		
PERR_RD PERR_WR	SFR FC[6] SFR FC[5]	0	0	R/W	71M6543 将这些位置位,表示在远端传感器上检测到奇偶校验错误。这些位一旦置位,则被记忆,直到由 MPU 清除。		
PLL_OK	SFR F9[4]	0	0	R	表示系统倍频电路 PLL 已稳定。		
PLL_FAST	2200[4]	0	0	R/W	控制 PLL 和 MCK 的速率。 1 = 19.66 MHz (XTAL * 600) 0 = 6.29 MHz (XTAL * 192)		
PLS_MAXWIDTH[7:0]	210A[7:0]	FF	FF	R/W	PLS_MAXWIDTH[7:0]决定最大脉宽(如果 PLS_INV=0,为负向脉冲;如果 PLS_INV=1,为正向脉冲)。最大脉宽为(2*PLS_MAXWIDTH[7:0] + 1)*T ₁ 。式中, T ₁ 为 PLS_INTERVAL[7:0],单位为 CK_FIR 时钟周期。如果 PLS_INTERVAL[7:0] = 0 或 PLS_MAXWIDTH[7:0] = 255,则不执行脉宽检查,输出脉冲的占空比为 50%。参见第 2.3.6.2 节 VPULSE 和 WPULSE。		
PLS_INTERVAL[7:0]	210B[7:0]	0	0	R/W	PLS_INTERVAL[7:0]决定脉冲之间的间隔时间。输出脉冲之间的时间为PLS_INTERVAL[7:0]*4,单位为 CK_FIR 时钟周期。如果 PLS_INTERVAL[7:0] = 0,不使用 FIFO,只要 CE 发出命令,则立即输出脉冲。PLS_INTERVAL[7:0]计算如下: PLS_INTERVAL[7:0] = Floor (Mux frame duration in CK_FIR cycles / CE pulse updates per Mux frame / 4) 例如,由于编写的 71M6543 CE 代码在一个积分周期内产生 6 个脉冲,使能 FIFO时(即 PLS_INTERVAL[7:0] ≠ 0,帧持续时间为 1950 个 CK_FIR 时钟周期,PLS_INTERVAL[7:0]应写入 Floor(1950 / 6 / 4) = 81,所以 5 个脉冲均匀分布在积分间隔内,最后一个脉冲恰好在间隔结束之前。参见第 2.3.6.2 节 VPULSE 和WPULSE。		
PLS_INV	210C[0]	0	0	R/W	反转 WPULSE 和 VARPULSE 极性。这些脉冲通常为低电平有效。反转时,它们变为高电平有效。 <i>PLS_INV</i> 对 XPULSE 或 YPULSE 没有影响。		
PORT_E	270C[5]	0	0	R/W	SEGDIO0 至 SEGDIO15 引脚使能输出。上电复位后,PORT_E = 0,防止 SEGDIO0 至 SEGDIO15 引脚上电时输出瞬间干扰脉冲。		
PRE_E	2704[5]	0	0	R/W	使能 8x 前置放大器。		
PREBOOT	SFRB2[7]	-	_	R	表示预引导程序有效。		
RCMD[4:0]	SFR FC[4:0]	0	0	R/W	MPU 向 <i>RCMD</i> 写非零值时,71M6543 向相应远端传感器发出该命令。完成命令后,71M6543 清除 <i>RCMD</i> 。		
RESET	2200[3]	0	0	W	置位后,IC将WF_RSTBIT置位,然后复位。		

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明			
RFLY_DIS	210C[3]	0	0	R/W	设定 71M6543 对 71M6xxx 供电方式。置位时,电源脉冲交替驱动为高电平和低电平。清除时,以回扫间隔驱动至高电平。			
RMT2_E RMT4_E RMT6_E	2709[3] 2709[4] 2709[5]	0	0	R/W	使能远端接口。			
RMT_RD[15:8] RMT_RD[7:0]	2602[7:0] 2603[7:0]	0	0	R	远端读请求的响应。			
RTCA_ADJ[6:0]	2504[6:0]	40	-	R/W	用于模拟 RTC 频率调整的寄存器。			
RTC_FAIL	2890[4]	0	0	R/W	表示 RTC 中发生计数错误,时间不可信。该位可通过写 0 清除。			
RTC_P[16:14] RTC_P[13:6] RTC_P[5:0]	289B[2:0] 289C[7:0] 289D[7:2]	4 0 0	4 0 0	R/W	RTC 调节。参见第 2.5.4 节实时时钟(RTC)。 0x0FFBF ≤ <i>RTC_P</i> ≤ 0x10040 注: <i>RTC_P</i> [16:0]和 <i>RTC_Q</i> [1:0]组成一个 19 位有符号 RTC 调整值。			
RTC_Q[1:0]	289D[1:0]	0	0	R/W	RTC 调节。参见第 2.5.4 节实时时钟(RTC)。 注: <i>RTC_P[16:0]</i> 和 <i>RTC_Q[1:0]</i> 组成一个 19 位有符号 RTC 调整值。			
RTC_RD	2890[6]	0	0	R/W	冻结 RTC 影子寄存器,以便 RTC 读取。读 <i>RTC_RD</i> 时,返回影子寄存器的状态: 0 = 更新,1 = 冻结。			
RTC_SBSC[7:0]	2892[7:0]	_	_	R	到下个 1 秒边界剩余的时间。LSB = 1/128 秒。			
RTC_TMIN[5:0]	289E[5:0]	0	-	R/W	闹铃分钟寄存器。参见下文的 RTC_THR。			
RTC_THR[4:0]	289F[4:0]	0	-	R/W	闹铃小时寄存器。 <i>RTC_MI</i> N[<i>5:0</i>]等于 <i>RTC_TMIN5:0</i>]且 <i>RTC_HR</i> [<i>4:0</i>]等于 <i>RTC_THR</i> [<i>4:0</i>]时,发生 RTC_T 中断。			
RTC_WR	2890[7]	0	0	R/W	冻结 RTC 影子寄存器,以便 MPU 写操作。 RTC_WR 清除时,在下一个 RTC 时钟 (\sim 1kHz)将影子寄存器的内容写入至 RTC 计数器。读 RTC_WR 时,只要 RTC_WR 置位,则返回 1。在 RTC 计数器实际更新之前,它将继续返回 1。			
RTC_SEC[5:0] RTC_MIN[5:0] RTC_HR[4:0] RTC_DAY[2:0] RTC_DATE[4:0] RTC_MO[3:0] RTC_YR[7:0]	2893[5:0] 2894[5:0] 2895[4:0] 2896[2:0] 2897[4:0] 2898[3:0] 2899[7:0]			R/W	RTC 接口寄存器。这些是 RTC 的年、月、日、时、分和秒参数。通过写这些寄存器设置 RTC。00 年以及其它能够被 4 整除的年份定义为闰年。 SEC 00 to 59			

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明		
RTM_E	2106[1]	0	0	R/W	使能实时监测器。为0时,RTM输出为低电平。		
RTM0[9:8] RTM0[7:0] RTM1[7:0] RTM2[7:0] RTM3[7:0]	210D[1:0] 210E[7:0] 210F[7:0] 2110[7:0] 2111[7:0]	0 0 0 0	0 0 0 0	R/W	四个 RTM 监测器。每一 CE 执行周期之前,这些寄存器的值在 RTM 引脚上顺序输出。 <i>RTM_E</i> = 0 时,忽略 RTM 寄存器。注意,RTM0 为 10 位宽。其它 RTM 的高 2 位假定为 00。		
SECURE	SFR B2[6]	0	0	R/W	禁止擦除 0 页及 CE_LCTN[6/5:0]定义的 CE 代码开始地址以上的闪存。也禁止通过外设(SPI 和 ICE 端口)读取闪存。		
SLEEP	28B2[7]	0	0	W	将 71M6543 置于休眠模式。如果有系统电源,则忽略。唤醒定时器超时、唤醒拉钮被按下或系统电源恢复时,71M6543 唤醒。		
SPI_CMD	SFR FD[7:0]	_	_	R	来自主控制器的8位SPI命令寄存器。		
SPI_E	270C[4]	1	1	R/W	SPI 端口使能。使能引脚 SEGDIO36 至 SEGDIO39 的 SPI 接口。要求 <i>LCD_MAP[36-39]</i> = 0。		
SPI_SAFE	270C[3]	0	0	R/W	将 SPI 写操作限值为 SPI_CMD 及 XRAM 中的 16 字节区域。不允许进行其它地址写操作。		
SPI_STAT	2708[7:0]	0	0	R	SPI_STAT 前一次 SPI 通信的状态结果。 第7位-就绪错误: 71M6543 未准备好按照前一命令读或写。 第6位-读数据奇偶性: 该位是前一命令从 71M6543 读取的全部字节的奇偶校验。不包括 SPI_STAT 字节。 第5位-写数据奇偶性: 该位是前一命令写入 71M6543 的全部字节的奇偶校验。 它包括 CMD 和 ADDR 字节。 第4至2位-字节数的最低3位。不包括 ADDR 和 CMD 字节。1、2和3字节指令返回111。 第1位-SPI FLASH模式: TEST 引脚为零时,该位为零。 第0位-SPI FLASH模式就绪: 用于 SPIFLASH模式。表示 FLASH 已准备好接收另一条写指令。		
STEMP[10:3] STEMP[2:0]	2881[7:0] 2882[7:5]			R R	温度测量结果。		
SUM_SAMPS[12:8] SUM_SAMPS[7:0]	2107[4:0] 2108[7:0]	0	0	R/W	每一个 XFER_BUSY 中断的复用帧数量。最大值为 8191 个周期。		
TBYTE_BUSY	28A0[3]	0	0	R	表示硬件仍然在写 0x28A0 字节。为 1 时,不允许对该字节进行写操作。写操作持续时间可长达 6ms。		

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明						
TEMP_22[10:8] TEMP_22[7:0]	230A[2:0] 230B[7:0]	0	1	R	22°C 时的 STEMF	P[10:0]储存地址。S7	TEMP[10:0]为 11	位字。			
TEMP_BAT	28A0[4]	0	ı	R/W	只要进行温度测量	量,则测量 VBAT。					
TEMP_BSEL	28A0[7]	0	-	R/W		选择测量哪个电池引脚: 1 = VBAT,0 = VBAT_RTC。					
TEMP_PER[2:0]	28A0[2:0]	0	-	R/W	自动测量。 <i>TEMP</i> 启动单次温度测量 <i>TEMP_PER</i> 医 0 力	0 无温度更新 1-6 2(3+TEMP_PER) 7 连续更新					
TEMP_PWR	28A0[6]	0	1	R/W	选择温度传感器的供电电源: 1 = V3P3D, 0 = VBAT_RTC. SLP 和 LCD 模式下忽略该位,而总是由 VBAT_RTC 供电。						
TEMP_START	28B4[6]	0	0	R/W	测量。每次测量需	TEMP_PER = 0 时,禁用自动温度更新,MPU 可利用 TEMP_START 启动单次温度测量。每次测量需要 30ms。完成温度测量时,硬件清除 TEMP_START。因此固件需要判断该位,为 0 后方可读取 STEMP 温度值。					
TMUX[5:0]	2502[5:0]	1	-	R/W	TMUXOUT 选择的	的 32 个信号之一,该	羊情参见第 2.5.1	4节。			
TMUX2[4:0]	2503[4:0]	_	1	R/W	TMUX2OUT 选择	的 32 个信号之一,	详情参见第 2.5 .	.14 节。			
TMUXR2[2:0] TMUXR4[2:0] TMUXR6[2:0]	270A[2:0] 270A[6:4] 2709[2:0]	000	000	R/W	用于远端传感器的	勺 TMUX 设置(71M6	xx3)。				
					芯片版本号。固件	井可通过读取该字确?	定芯片版本。				
					VERSION[7:0]	71M6543F/H 版本号	71M6543G/G 版本号	Н			
VERSION[7:0]	2706[7:0]	_	- R		0001 0001	A01	A01				
					0001 0011	A03	N/A				
						B01	N/A				
					0010 0010 B02 N/A						
VREF_CAL	2704[7]	0	0	R/W	ADC 基准电压输出到 VREF 引脚, VREF_DIS = 1 时禁用该功能。推荐禁止输出。						
VREF_DIS	2704[6]	0	1	R/W	禁用内部 ADC 电	压基准。					

名称	位置	复位	唤醒	方向	说明	说明				
					该字说明电源	及 VDD 的状态。				
					VSTAT[2:0]	说明				
					000	系统电源就绪,V3P3A>3.0V。模拟电路工作正常、准确测量。 [V3AOK,V3OK] = 11				
					001	系统电源电压较低,2.8V <v3p3a<3.0v,模拟电路测量不准确。即将切换至电池电源。[v3aok,v3ok] 01<="" =="" td=""></v3p3a<3.0v,模拟电路测量不准确。即将切换至电池电源。[v3aok,v3ok]>				
VSTAT[2:0]	SFR F9[2:0]	_	-	R	010	电池电源和 VDD 就绪,VDD>2.25V,所有数字功能正常工作。 [V3AOK,V3OK] = 00,[VDDOK,VDDgt2] = 11				
					011	电池电源和 VDD>2.0,禁止 FLASH 写操作。如果 TRIMVDD[5] 熔丝熔断, <i>PLL_FAST (I/O RAM 0x2200[4])</i> 清零。 [V3AOK,V3OK] = 00, [VDDOK,VDDgt2] = 01				
					101	电池电源和 VDD< 2.0V。VSTAT=101 时,处理器接近掉电。将引发处理器故障。[V3AOK,V3OK] = 00, [VDDOK,VDDgt2] = 00				
WAKE_ARM	28B2[5]	0	-	R/W	准备好 WAKE 定时器,并向其装载 WAKE_TMR[7:0]。MPU 触发 SLEEP 或 LCD 模式有效时,WAKE 定时器开始启动。					
WAKE_TMR	2880[7:0]	0	-	R/W	定时器唤醒间隔为 WAKE_TMR+1 秒。					
WD_RST	28B4[7]	0	0	W	复位 WD 定时器。向该位写 1 时,WD 复位(喂狗)					
WF_DIO4	28B1[2]	0	-	R		已位。DIO4 配置为唤醒器件时,只要去抖后的 DIO4 变高,该位置 未配置为唤醒,它保持在复位状态。				
WF_DIO52	28B1[1]	0	-	R		识位。DIO52 配置为唤醒器件时,只要去抖后的 DIO52 变高,该位 052 未配置为唤醒,它保持在复位状态。				
WF_DIO55	28B1[0]	0	-	R		识位。DIO55 配置为唤醒器件时,只要去抖后的 DIO55 变高,该位 055 未配置为唤醒,它保持在复位状态。				
WF_TMR	28B1[5]	0	-	R	唤醒定时器唤醒	醒标识位。				
WF_PB	28B1[3]	0	-	R	PB唤醒标识位	Ī.o				
WF_RX	28B1[4]	0	-	R	RX唤醒标识位	Ī.				
WF_CSTART WF_RST WF_RSTBIT WF_OVF WF_ERST	28B0[7] 28B0[6] 28B0[5] 28B0[4] 28B0[3]	0 1 0 0	-	R	RESET 引脚、RESET 位、E_RST 引脚、看门狗定时器、冷启动检测器或 VB. 失效引起复位的标识位。					
WF_BADVDD	28B0[2]	0								

5.3 读信息页(71M6543H和 71M6543GH)

71M6543H 和 71M6543GH 器件中提供的精密熔丝值不可直接通过 I/O RAM 读取。这些熔丝值保存在称为 "信息页"的独立区域。MPU 通过设置 $INFO_PG$ (I/O RAM 0x270B[0])控制位读取信息页。一旦置位 $INFO_PG$,即 可 根 据 71M6543H 中 $CE_LCTN[6/5:0]$ (I/O RAM 0x2109[5:0]) 及 71M6543GH 中 $CE_LCTN[6:0]$ (I/O RAM 0x2109[6:0])指定的地址读取程序存储器空间。71M6543H 中的 $CE_LCTN[5:0]$ 和 71M6543GH 中的 $CE_LCTN[6:0]$ 指定 1KB 地址空间的开始地址。所以,信息页的开始地址在 71M6543H 中为 $1024*CE_LCTN[5:0]$,在 71M6543GH 中为 $1024*CE_LCTN[6:0]$ 。表 72 给出了 71M6543H 和 71M6543GH 的熔丝值及其相对于信息页开始地址的偏移量。读取相应的信息页后,MPU 必须复位 $INFO_PG$ 位。

表 72. 信息页熔丝调整

调整溶丝	目标尺寸	地址偏移	注释
TEMP_85[10:8] TEMP_85[7:0] (11-bits)	8-bits 8-bits	0x90 0x91	<i>TEMP_85[10:0]</i> 储存 85°C 时的 STEMP[10:0] 读数,格式为 2 的补码。
TRIMBGB[15:8] TRIMBGB[7:0] (16-bits)	8-bits 8-bits	0x92 0x93	TRIMBGB[15:0]储存 85℃ 时 VREF 相对于其理想值(1.195V) 的偏差,LSB = 0.1 mV 。格式 为 2 的补码。
TRIMBGD[7:0] (8-bits)	8-bits	0x94	TRIMBGD[7:0]储存 22°C 时 VREF 相对于其理想值(1.195V) 的偏差,LSB = 0.1 mV 。格式 为 2 的补码。
LCDADJ12[7:0] (8-bits)	8-bits	0x95	LCD_DAC = 0℃时, 22℃下, LCDADJ12 = [VLCD-3.676v], LSB = 5mV。格式为 2 的补码。
LCDADJ0[7:0] (8-bits)	8-bits	0x96	<i>LCD_DAC</i> = 0℃时,22℃下, <i>LCDADJ0</i> = [VLCD-2.65v], LSB = 5mV。格式为 2 的补码。

图 38. 熔丝位映射

偏移	名称	第7位	第6位	第5位	第 4 位	第3位	第2位	第 1 位	第 0 位		
0x90	TEMP_85[10:0]						TEMF	P_85[10:	[8:		
0x91	1EMF_05[10:0]				TEMP_85	[7:0]					
0x92	TDIMDCD[15.0]	TRIMBGB[15:8]									
0x93	TRIMBGB[15:0]				TRIMBGB	[7:0]			·		
0x94	TRIMBGD[7:0]		•	•	TRIMBGD	[7:0]		•	·		

以下代码提供了一个读取信息页熔丝值的示例。本例中,地址 "px"指向 MPU 程序空间。在汇编语言中,信息页数据对象为只读,必须用 MOVC 8051 指令存取。

C语言中,信息页熔丝值必须用正确宽度的指针获取,取决于获取的是 8 位还是 16 位数据对象。以下示例代码中,根据需要,通过类型转换获取适用于每个对象的正确指针。

在汇编语言中, MPU 必须根据两个独立的 8 位数据构成 11 位或 16 位值,取决于被获取的对象。

有效位小于 8 位的字节采用低位对齐。例如,信息页偏移 0x90 是一个 8 位对象,其三个 LSB 为 $TEMP_85[10:0]$ 11 位对象的[10:8] 位。信息页数据对象为 2 的补码格式,在读入一个 16 位数据字节时,应采用符号扩展(参见示例代码中的 case _TEMP85)。

```
#if HIGH_PRECISION_METER
int16_t read_trim (enum eTRIMSEL select) {
    uint8r t *px;
    int16 t x;
    px = ((uint16_t)select) + ((uint8r_t *)(CE3 << 10));</pre>
    switch (select)
        default:
        case TRIMBGD:
            INFO_PG = 1;
            x = *px;
            INFO PG = 0;
            break;
        case _TRIMBGB:
            INFO PG = 1;
            x = *(uint16r_t*)px;
            INFO PG = 0;
            break;
        case _TEMP85:
            INFO PG = 1;
            x = *(uint16r_t*)px;
            INFO PG = 0;
            if (x & 0x800)
                x = 0xF800;
            break;
    return (x);
#endif //#if HIGH_PRECISION_METER
```

5.4 CE接口说明

5.4.1 CE程序

CE 执行准确计量所需的精密计算。这些计算包括消除失调、相位补偿、乘积平滑、乘积求和、频率检测、VAR 计算、电压跌落检测和电压相位测量。CE 计算得到的所有数据均依赖于 *EQU[2:0] (I/O RAM 0x2106[7:5])*选择的计量公式。

标准 CE 程序由 Teridian 作为数据映像提供,可与 MPU 操作码整合,用于表计设计。一般随 CE 程序提供演示代码,无需修改即可用于多数应用。Teridian 也可提供其它类型的 CE 代码。本节介绍的内容适用于 CE43A01A 版 CE 代码。

5.4.2 CE数据格式

所有 CE 字为 4 个字节。除非特别说明,其格式为 32 位 2 的补码(-1 = 0xFFFFFFFF)。校准参数一般存放在 EEPROM (或内部 FLASH)中,启动 CE 之前,必须由 MPU 复制到 CE 的校准寄存器。"内部"变量用于 CE 的内部运算;"输入"变量使 MPU 能够控制 CE 操作;"输出"变量是 CE 计算结果的输出。最高字节的对应 MPU 地址由 0x0000 + 4 x CE_address 地址给出,0x0003 + 4 x CE_address 给出最低字节。

5.4.3 常量

与 CE 输出计量数据有关的常量有:

- 采样频率:F_S = 32768Hz/15 = 2184.53Hz。
- F₀为电网的基波频率。
- IMAX 为外部电流有效值,对应于每个 IADC 输入的 250 mV pk
- VMAX 为外部电压有效值,对应于输入 VADC 输入的 250mV pk。
- NACC, 电能累积周期内的采样点数,即 *SUM_SAMPS[12:0] (I/O RAM 0x2107[4:0], 0x2108[7:0]*)。该值 还位于 *SUM_PRE (CE RAM 0x23)*,用于相位角测量。
- 电能累积时间 SUM SAMPS[12:0] / Fs。即 XFER 中断频率。
- X 为脉冲发生器的增益常数。由 CECONFIG 寄存器的 PULSE_FAST 和 PULSE_SLOW 位组合控制(见表78)。
- 电压 LSB = VMAX * 7.8798*10⁻⁹ V。
- 默认设置为 VMAX = 600 V, IMAX = 208 A, 及 kH = 3.2 Wh/脉冲。

系统常数 IMAX 和 VMAX 是供 MPU 使用,将内部数字量(CE 使用)转换为外部参量,即表计参量。其值由实际电表使用的电压和电流传感器的缩放比例决定。本文使用的 LSB 值将 CE 或 MPU 接口处的数字量与外部电表输入参量关联起来。例如,如果要求电表输入 SAG 检测门限为 80V 峰值,那么 SAG_THR (CE RAM Ox24)的数值应为 80 Vrms * SQRT(2)/ SAG_THR_{LSB} ,其中 SAG_THR_{LSB} 为 SAG_THR 说明中的 LSB 值 (见表 79)。

参数 EQU[2:0]、CE_E 和 SUM_SAMPS[12:0]对于 CE 工作是必不可少的(详情请参见见第 5.2 节)。

5.4.4 环境

在利用 $CE \ E \ C(I/O\ RAM\ 0x2106[0])$ 启动 $CE \ 之前$, $MPU \ 必须通过以下步骤对 <math>CE \ 进行必要的配置$:

- 利用 71M6543F/H 的 CE_LCTN[5:0] (I/O RAM 0x2109[5:0])和 71M6543G/GH 的 CE_LCTN[6:0] (I/O RAM 0x2109[6:0])定位 CE 代码在 FLASH 中的起始地址
- 初始化 CE RAM 区
- 在 EQU[2:0] (I/O RAM 0x2106[7:5])中确定应用的计量公式
- 在 SUM SAMPS[12:0] (I/O RAM 0x2107[4:0], 0x2108[7:0])中确定每累积周期的采样点数
- 在(MUX_DIV[3:0] (I/O RAM 0x2100[7:4]))中确定每 ADC 复用帧的周期数量
- 为 *MUXn_SEL* 应用合适的值,以及为 *DIFFn_E (I/O RAM 0x210C[])*和 *RMT_E (I/O RAM 0x2709[])*应用 合适的选项,以配置模拟输入
- 配置 CE 对 MPU 的中断。例如 CE BUSY、XFER BUSY,或者电源故障检测中断

使用不同的 CE 代码时,需要确定不同组的环境参数。这些参数的准确值列在随 CE 代码提供的应用笔记和其它文档中。



如果 CE 代码运行时的环境参数不同于 Teridian 指定的数值,会产生不可预知的结果。

通常情况下,每个复用帧有 15 个 32768Hz 周期(见第 2.2.2 节)。这意味着每个转换时隙中周期的数量与每帧中转换数量的乘积必须为 14 (允许每帧加一个稳定周期)。默认配置为 $FIR_LEN[1:0] = 01$,I/O RAM Ox210C[1] (每次转换需 3 个周期)和 MUX DIV[3:0] = 7 (每复用循环 7 次转换)。

可从 Teridian 随演示工具包提供的演示代码中复制采样配置

5.4.5 CE计算

参见表 73, MPU 通过写 EQU[2:0] (I/O RAM 0x2106[7:5])选择相应的公式。

表 73. CE EQU[2:0]公式和单元输入映射

EQU [2:0]*	Watt & VAR 公式 (WSUM/VARSUM)	W0SUM/ VAR0SUM	WISUM/ VARISUM	W2SUM/ VAR2SUM	IOSQ SUM	IISQ SUM	I2SQ SUM
2	VA*IA + VB*IB (2-element, 3-W, 3□φ Delta)	VA * IA	VB * IB	N/A	IA	IB	1
3	VA*(IA-IB)/2 + VC*IC (2 element, 4W 3φ Delta)	VA*(IA-IB)/2	-	VC*IC	IA-IB	IB	IC
4	VA*(IA-IB)/2 + VB*(IC-IB)/2 (2 element, 4W 3φ Wye)	VA*(IA-IB)/2	VB*(IC-IB)/2	-	IA-IB	IC-IB	IC
5	VA*IA + VB*IB + VC*IC (3 element, 4W 3φ Wye)	VA*IA	VB*IB	VC*IC	IA	IB	IC

注:

*当前 71M6543 可用的 CE 代码仅支持 EQU[2:0=5]。关于支持公式 2、3 和 4 的 CE 代码,请联系您当地的 Teridian 代表处。

5.4.6 CE前端数据(原始数据)

通过读取表 74 所示 CE RAM 地址 0 至 A,访问 AFE 提供的原始 ADC 数据。表达式 $MUXn_SEL[3:0] = x$ 中,'n'指复用帧时隙数量,'x'指相应的 ADC 输入编号或 ADC 序号(即 IADC0 至 VADC10,或简单的 0 至 10 十 进制)。

所有电流传感器配置为单端输入时,71M6543 可支持多达 11 路传感器输入。如果所有电流传感器配置为差分(推荐采用搽粉输入,以获得最佳性能),输入传感器通道数量减至 7 路(即 IADC0-1、IADC2-3、IADC4-5、IADC6-7、VADC8、VADC9 和 VADC10)。表 74 中的 MUXn_SEL[3:0]栏显示不同传感器输入引脚的 MUXn_SEL 序号。例如,如果通过控制位 $DIFF0_E = 1$ (I/O RAM Ox21OC[4])使能差分模式,那么输入引脚 IADC0-IADC1 被组合在一起形成一个差分输入,对应的 $MUXn_SEL$ 序号为 0 (即不使用序号 1)。类似地,CE RAM 地址栏提供储存采样数据的 CE RAM 地址。仍用以上例子说明,如果 $DIFF0_E = 1$,储存 IADC0-IADC1 差分输入的采样对应的 CE RAM 位置为 CE RAM 0。

IADC2-3、IADC4-5 和 IADC6-7 输入可配置为直接连接传感器(即直接连接至 71M6543)或远端传感器(即采用 71M6xx3 隔离传感器)。例如,如果通过 $RMT2_E = 0$ (I/O RAM 0x2007[3])禁用远端传感器 IADC2-3,通过 $DIFF2_E = 1$ (I/O RAM 0x210C[5])使能差分模式,那么 IADC2-IADC3 构成一路差分输入, $MUXn_SEL$ 序号为 2 (不使用序号 3),对应采样值储存在 CE RAM 地址 2。如果远端使能位 $RMT2_E = 1$, $DIFF2_E = x$ (无关),那么 $MUXn_SEL$ 序号未定义(即传感器未连接至 71M6543 多路复用器,没有作用 $MUXn_SEL$),对应于远端差分 IADC2-IADC3 输入的采样值通过数字隔离接口直接储存在 CE RAM 地址 2 (见图 2)。

电压传感器输入(VADC8、VADC9 和 VADC10)总为单端输入,不能配置为远端,所以没有任何相关的配置位。VADC8 (VA 的 *MUX_SEL* 序号为 8,其采样值储存在 CE RAM 地址 8; VADC9 VB 的 *MUXn_SEL* 序号为 9,其采样储存在 CE RAM 地址 9; VADC10 (VC)的 *MUXn_SEL* 序号为 10,其采样值储存在 CE RAM 地址 10。

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
引脚	İ	MUXn_S	EL 序号	<u>1.</u> 7	CE RAM 位置			
	DIF	F0_E			DIFF	TO_E		
	0	1			0	1		
IADC0	0	0			0	0		
IADC1	1	U			1	O		
	F	RMT2_E,	DIFF2_	E	R.	MT2_E,	DIFF2_E	
	0,0	0,1	1,0	1,1	0,0	0,1	1,0	1,1
IADC2	2	2	_	_	2	2	2*	2*
IADC3	3		_	_	3	2	2	2
	F	RMT4_E,	DIFF4_	E	R	MT4_E,	DIFF4_E	
	0,0	0,1	1,0	1,1	0,0	0,1	1,0	1,1
IADC4	4				4			
IADC5	5	4	-	-	5	4	4*	4*
	F	RMT6_E,	DIFF6_	E	RMT6_E, DIFF6_E			
	0,0	0,1	1,0	1,1	0,0	0,1	1,0	1,1
IADC6	6	6	_	_	6	6	6*	6*
IADC7	7	U	_	_	7	O	0	0
		There a	re no co	nfigurat	ion bits fo	or VADC	8, 9, 10	
VADC8 (VA)	8				8			
VADC9 (VB)	9				9			
VADC10 (VC)	10				10			
→ valu l.→ . → v// . t.=								

表 74. CE 原始数据访问地址

^{*}远端接口数据。

5.4.7 CE状态和控制

CE 状态字可以为 MPU 提供掉电预警(见表 75),这点非常有用。它包含 A、B 和 C 相的电压跌落报警,以及由基波输入频率产生的时钟 F0。MPU 可在每个 CE_BUSY 中断读取 CE 状态字。由于 CE_BUSY 中断按照采样率产生($MUX_DIV[3:0]=6$ 时,频率为 2520.6Hz;或 $MUX_DIV[3:0]=7$ 时,频率为 2184.5 Hz),因此,MPU 处理中断时应尽量减少计算任务。

表 75. CESTATUS 寄存器

CE 地址	名称	说明
0x80	CESTATUS	参见表 76 中的 CESTATUS 位说明。

CESTATUS 提供关于电压状态及输入交流信号频率的信息,对于产生电源故障预警,从而启动必要的数据存储非常有用。CESTATUS 在每次 CE 代码运行结束后更新(CE_BUSY 中断)。CESTATUS 中位的说明见表76。

表 76. CESTATUS 位定义

CESTATUS 位	名称	说明
31:4	Not Used	未使用的位始终为 0。
3	F0	F0 为方波,频率为电网的基波频率。
2	SAG_C	正常时为 0。VADC10 (VC)保持低于 SAG_THR (CE RAM 0x24), 经过 SAG_CNT 个采样后变为 1; 直到 VADC10 (VC)升高至 SAG_THR 以上才清 0。
1	SAG_B	正常时为 0。VADC9 (VB)保持低于 SAG_THR, 经过 SAG_CNT 个采样后变为 1; 直到 VADC9 (VB)升高至 SAG_THR 以上才清 0。
0	SAG_A	正常时为 0。VADC8 (VA)保持低于 SAG_THR, 经过 SAG_CNT 个采样后变为 1; 直到 VADC8 (VA)升高至 SAG_THR 以上才清 0。

MPU 利用 *CECONFIG* 配置 CE (表 77)。该寄存器含有 *SAG_CNT、FREQSEL0、 FREQSEL1、EXT_PULSE、PULSE_SLOW* 和 *PULSE_FAST。CECONFIG* 位定义如表 78 所示。

表 77. CECONFIG 寄存器

CE 地址	名称	数据	说明
0x20	CECONFIG	0x0030DA20	参见表 78 中 CECONFIG 位说明。

EXT TEMP 位置 1 时使能 MPU 的温度补偿。置 0 时,使能内部(CE)温度补偿。

CE 脉冲发生器可由 MPU (外部)或 CE (内部)变量控制。如果 *EXT_PULSE* = 1,由 MPU 控制。此时,MPU 通过写入 *APULSEW* 和 *APULSER* (*CE RAM 0x45 和 0x49*)控制脉冲频率。通过设置 *EXT_PULSE* = 0, CE 根据 *WSUM_X* (*CE RAM 0x84*)和 *VARSUM_X* (*CE RAM 0x88*)控制脉冲频率。



71M6543 演示程序的蠕变函数暂停内部和外部脉冲发生器工作。

表 78. CECONFIG 位定义(CE RAM 0x20)

CECONFIG 位	名称	默认值	说明						
23	保留	0	保留						
22	EXT_TEMP	0		为 1 时,MPU 通过 <i>GAIN_ADJn</i> 寄存器 <i>(CE RAM 0x40-0x42)</i> 控 制温度补偿。					
21	EDGE_INT	1		为 1 时,XPULSE 在 FREQSEL[1:0]所选相电压过零时产生一个脉冲,可用于中断 MPU。					
20	SAG_INT	1		_	<i>)SEL[1:0]</i> 所选)7 输出(见 2.5	的相上检测到跌 . <mark>10)</mark> 。	落条件时激活		
19:8	SAG_CNT	218 (0xDA)		发出电压跌落警告之前,在 <i>SAG_THR (CE RAM 0x24)</i> 以下的电压连续采样数量。默认值等效于 100ms。					
						则、电压跌落检 _ <i>X, CE RAM 0x8</i>			
			FREQ S	SEL[1:0]	选择相	选择	植		
7:6 FREOSE	FREQSEL[1:0]	0] 0				PH_AtoB_X	PH_AtoC_X		
	i imgszz[iio]		0	0	Α	A-B	A-C		
			0	1	В	B-C	B-A		
					1	0	С	C-A	С-В
			1	1		不允许			
5	EXT_PULSE	1	为 0 时,使脉冲发生器自动响应内部数据(WPULSE = WSUM_X (CE RAM 0x84), VPULSE = VARSUM_X (CE RAM 0x88))。否则,发生器响应 MPU 置于 APULSEW 和 APULSER (CE RAM 0x45 and 0x49)中的值。						
4:2	Reserved	0	保留。						
1	PULSE_FAST	0	PULSE_FAST = 1 时,脉冲发生器输入增加 16 倍。 PULSE_SLOW = 1 时,脉冲发生器输入缩减 64 倍。这两个参数控制脉冲增益因子 X (见下表)。允许值为 1 或 0。两个参数的默认值均为 0 (X = 6)。						
0	PULSE_SLOW	0	0 0 1	FAST 1	0 1 0 1	X 1.5 * 2 ² = 1.5 * 2 ⁻⁴ = 0.0 1.5 * 2 ⁶ = 9	9375		

CECONFIG (CE RAM 0x20[7:6])中的 FREQSEL[1:0]字段选择用于产生电压跌落中断的相。这样,当所选的相电压满足 SAG_THR (CE RAM 0x24)寄存器和 CECONFIG (CE RAM 0x20[19:8])中 SAG_CNT 字段设定的电压跌落事件条件时,发生 SAG_INT 事件。SAG_INT 位(CE RAM 0x20[20])设为 1 时,电压跌落事件在YPULSE 输出产生一个跳变。3 相系统中,跌落中断之后,MPU 应更改 FREQSEL[1:0]设置,选择另一相(如果系统还有电)。即使只在所选相上发生电压跌落中断,两相应同时检查跌落。通过直接检查 CESTATUS (CE RAM 0x80[0:1])中 SAG_A、SAG_B和 SAG_C位,可检测给定相的电源电压。

为1时, EXT_TEMP 位使能 MPU 进行的温度补偿。为0时, 使能内部(CE)温度补偿。

CE 脉冲发生器可由 MPU (外部)或 CE (内部)变量控制。如果 EXT_PULSE 位= 1 (CE RAM 0x20[5]),由 MPU 控制。这种情况下,MPU 通过将数值放入 APULSEW 和 APULSER (CE RAM 0x45 and 0x49),控制脉冲速率(外部脉冲发生)。通过设置 EXT_PULSE = 0,CE 用 WSUM_X (CE RAM 0x84)和 VARSUM_X (CE RAM 0x88)控制脉冲速率。



71M6543 演示代码在电压跌落时关闭内部和外部脉冲发生器。

表 79. 电压跌落门限、相测量和增益调节控制

CE 地址	名称	默认值	说明
0x24	SAG_THR	2.39*10 ⁷	电压跌落报警门限。如果 VMAX = 600 V RMS,默认值相当于80 V RMS。
0x40	GAIN_ADJ0	16384	
0x41	GAIN_ADJ1	16384	增益调整的分配取决于电表设计,请参见第 90 页 4.5.5 节 VREF和分流传感器的温度补偿或第 92 页 4.5.6 节 VREF和电流变压
0x42	GAIN_ADJ2	16384	和方流传感器的温度补偿或第 92 页 4.5.6 1 VREF 和电流变压
0x43	GAIN_ADJ3	16384	默认值为 16384, 对应于单位增益。
0x44	GAIN_ADJ4	16384	>>(水田/1 1000年,/1/四 1 十四·21 皿。

5.4.8 CE传输变量

MPU 接收到 XFER_BUSY 中断时,表示传输变量中的数据已更新。CE 传输变量在 XFER_BUSY 中断发生的那次 CE 运行中修改。它们在下个 XFER_BUSY 中断之前保持不变。本数据资料中,CE 传输变量的名称末尾总为"_X"。传输变量可分类为:

- 基本能量测量数据
- 瞬态(RMS)值数据
- 其它测量参数

基本能量测量数据

表 80 介绍基本的能量测量数据。所有变量均为有符号的 32 位整数。累积变量,例如 WSUM,经内部缩放。所以当积分时间为 1 秒时,它们在溢出之前至少有 2 倍裕量。此外,硬件上不会允许在溢出时造成数据翻转问题。

表 80. CE 传递变量(含分流器)

CE 地址	名称	说明	配置
0x84	WSUM_X	符号和: WOSUM_X+WISUM_X+W2SUM_X.	
0x85	W0SUM_X	夕相思和思期中的左冲坐是和	网 24 (07 亩)
0x86	W1SUM_X	各相累积周期内的有功能量和。 LSB _W = 7.7562*10 ⁻¹³ VMAX * IMAX Wh.	
0x87	W2SUM_X	ESBW = 1:1302 TO VIVIAN IIVIAN VVII.	
0x88	VARSUM_X	符号和: VAROSUM_X+VARISUM_X+VAR2SUM_X.	图 31 (87 页)
0x89	VAROSUM_X	→ 各相累积周期内的无功能量和。 - LSB _w = 7.7562*10 ⁻¹³ VMAX * IMAX VARh.	
0x8A	VAR1SUM_X		
0x8B	VAR2SUM_X	LODW = 1.1002 TO VIVIAN TIVIAN VARTI.	

表	81.	CE	传递变量(CT)	
---	-----	----	----------	--

CE 地址	名称	说明	配置
0x84	WSUM_X	符号和: WOSUM_X+WISUM_X+W2SUM_X.	
0x85	W0SUM_X	夕和思和田期中的东西终患和	
0x86	W1SUM_X	各相累积周期内的有功能量和。 LSB _W = 1.0856*10 ⁻¹² VMAX IMAX Wh.	
0x87	W2SUM_X	LSBW = 1.0030 TO VIVIAX IIVIAX WIT.	图 32 (88 页)
0x88	VARSUM_X	符号和: VAROSUM_X+VARISUM_X+VAR2SUM_X.	图 32 (00 页)
0x89	VAROSUM_X	夕扫思和国期中的工事统具和	
0x8A	VAR1SUM_X	各相累积周期内的无功能量和。 LSB _w = 1.0856*10 ⁻¹² VMAX IMAX VARh.	
0x8B	VAR2SUM_X	LODW - 1.0000 TO VINIAN IIVIAN VARTI.	

 $WSUM_X$ 和 $VARSUM_X$ 是 A 相、B 相和 C 相的 Wh 或 VARh 有符号代数和,同时取决于控制字段 EQU[2:0] (I/O RAM Ox2106[7:5])中指定的计量公式。 $WxSUM_X$ 是 x 相在上一累积间隔内累积的 Wh 值,可根据规定的 LSB 值计算得到。

例如,当 VMAX = 600 V 及 IMAX = 208 A 时, $WnSUM_X$ 的 LSB 为 0.135 μ Wh。

5.4.8.1 瞬态能量测量数据

InSQSUM_X 和 *VnSQSUM* 是上一累积间隔采集的平方电流和电压采样之和。*INSQSUM_X* 可用于计算零线电流。

表 82. CE 能量测量变量(含分流器)

CE 地址	名称	说明	配置
0x8C	IOSQSUM_X	零线电流: LSB _I = 9.9045*10 ⁻¹³ * IMAX ² A ² h (<i>PRE_E</i> =0) LSB _I = 6.1903125*10 ⁻¹⁴ * IMAX ² A ² h (<i>PRE_E</i> =1)	
0x8D	IISQSUM_X		
0x8E	I2SQSUM_X	$LSB_1 = 6.3968*10^{-13} * (IMAX^2) A^2h$	图 31 (87 页)
0x8F	I3SQSUM_X		, , ,
0x90	V0SQSUM_X		
0x91	V1SQSUM_X	$LSB_V = 9.4045*10^{-13}*VMAX^2 V^2h$	
0x92	V2SQSUM_X		

表 83. CE 能量测量变量(CT)

CE 地址	名称	说明	配置
0x8C	IOSQSUM_X		
0x8D	IISQSUM_X	$LSB_1 = 1.0856*10^{-12} * (IMAX^2) A^2h$	
0x8E	I2SQSUM_X		
0x8F	I3SQSUM_X		图 32 (88 页)
0x90	V0SQSUM_X	$LSB_V = 1.0856*10^{-12} * VMAX^2 V^2h$	
0x91	V1SQSUM_X		
0x92	V2SQSUM_X		

MPU 可利用平方电流和电压采样计算得到 RMS 值,如下所示:

$$Ix_{RMS} = \sqrt{\frac{IxSQSUM \cdot LSB_I \cdot 3600 \cdot F_S}{N_{ACC}}} \qquad Vx_{RMS} = \sqrt{\frac{VxSQSUM \cdot LSB_V \cdot 3600 \cdot F_S}{N_{ACC}}}$$

其它传递变量包括可用于频率和相位测量的变量,以及反映电网电压和电池电压过零次数的变量。这些传递变量在表 84 中列出。

 $MAINEDGE_X$ 反映上一累积间隔内对 CECONFIG 寄存器 (CE RAM 0x20[7:6])中 FREQSEL[1:0]字段规定相上的交流信号的半周期数量(即过零次数)。 $MAINEDGE_X$ 对于根据输入交流信号实现实时时钟非常有用。

表 84. 其它传递变量

CE 地址	名称	说明
0x82	FREQ_X	基波频率: LSB = $\frac{2184 Hz}{2^{32}} \approx 0.509 \cdot 10^{-6} \text{Hz} (对于 CT)$ $\text{LSB} = \frac{2520 Hz}{2^{32}} \approx 0.587 \cdot 10^{-6} \text{Hz} (对于分流器)$
0x83	MAINEDGE_X	所选电压在上一累积间隔内的过零数量。过零包括任意方向,并去抖。
0x94	PH_AtoB_X	电压相位延时。根据 <i>CECONFIG</i> 寄存器中的 <i>FREQSEL[1:0]</i> 选择参考相: 如果 <i>FREQSEL[1:0]</i> 选择 A 相: A 至 B 相位延时。 如果 <i>FREQSEL[1:0]</i> 选择 B 相: B 至 C 相位延时。 如果 <i>FREQSEL[1:0]</i> 选择 C 相: C 至 A 相位延时。 以度为单位的相角为(0 至 360): <i>PH_AtoB_X</i> * 360/N _{ACC} + 2.4*15/13 (对于 CT) 以度为单位的相角为(0 至 360): <i>PH_AtoB_X</i> * 360/N _{ACC} + 2.4 (对于分流器)
0x95	PH_AtoC_X	如果 <i>FREQSEL</i> [1:0]选择 A 相: A 至 C 相位延时。 如果 <i>FREQSEL</i> [1:0]选择 B 相: B 至 A 相位延时。 如果 <i>FREQSEL</i> [1:0]选择 C 相: C 至 B 相位延时。 以度为单位的相角为(0 至 360): <i>PH_AtoC_X</i> * 360/N _{ACC} + 4.8*15/13 (对于 CT) 以度为单位的相角为(0 至 360): <i>PH_AtoC_X</i> * 360/N _{ACC} + 4.8*15/13 (对于分流器)



通过向 V_ANG_CNT 中写入大于 1 的值,可提高相位角测量精度(见表 79)。

5.4.9 脉冲发生

表 85 列出了 CE 脉冲发生器、参数。

CECONFIG PULSE_SLOW(CE RAM 0x20[0])和 *PULSE_FAST* 位(*CE RAM 0x20[1]*)的组合控制脉冲速率。 默认值为 **00**,此时保持 Kh 公式给定的脉冲速率。

WRATE (CE RAM 0x21)控制每个实测 Wh 和 VARh 产生的脉冲数量。WRATE 越低,实测能量参量的脉冲速率越低。表计常数 Kh 源于 WRATE,为每个脉冲所代表的能量值。也就是说,如果 Kh = 1Wh/脉冲,120 V和 30 A加到电表时,可以每秒产生一个脉冲。如果负载为 240V,150A,则每秒产生 10 个脉冲。以上假定功率因数为 1。

如果 *EXT_PULSE* = 1 (*CE RAM 0x20[5]*), 脉冲控制权交给 MPU。这种情况下,脉冲速率由 *APULSEW* 和 *APULSER* (*CE RAM 0x45 and 0x49*)决定。MPU 必须将产生脉冲的源加载至 *APULSEW* 和 *APULSER*,以产生脉冲。如果 *EXT_PULSE* = 0 (*CE RAM 0x20[5]*), 脉冲由 CE 控制。*W0SUM_X* (*CE RAM 0x85*)和 *VAR0SUM X* (*CE RAM 0x89*)为默认的脉冲发生源。这种情况下,潜动/启动功能不太好控制。

最大脉冲率为 $3*F_S = 7.5 \text{ kHz}$.

关于如何调节输出脉冲定时的详细信息,请参见第 27 页的第 2.3.6.2 节 VPULSE 和 WPULSE。

最大时间抖动为复用循环周期的 1/6(即 397/6=67µs),与测得的脉冲数量无关。所以,如果监测脉冲发生器 1 秒,峰值抖动为 67ppm; 10 秒后,峰值抖动为 6.7ppm。平均抖动总为零。如果试图以高于其最大值的速率驱动脉冲发生器,它仅仅是以最大速率输出。实际脉冲速率(以 WSUM 为例)为:

$$RATE = \frac{WRATE \cdot WSUM \cdot F_{s} \cdot X}{2^{46}} Hz,$$

式中, $F_S =$ 采样率(2184.53Hz),X =从 CE 变量 $PULSE_SLOW$ (CE RAM 0x20[0])和 $PULSE_FAST$ (CE RAM 0x20[1])获得的脉冲速率因子。

CE 地址	名称	默认值	说明
0x21	WRATE	227	Kh = VMAX*IMAX*K / (WRATE*N _{ACC} *X) Wh/脉冲 式中: 使用本地传感器(CT 或分流器)时,K = 76.3594 使用 71M6xx3 远端传感器时,K = 54.5793
0x22	KVAR	6444	VAR 测量缩放比例系数。
0x23	SUM_PRE	2184	每个累积间隔内的采样数量,如同 <i>SUM_SAMPS[12:0]、I/O RAM 0x2107[4:0]、0x2108[7:0]</i> (Nacc)。
0x45	APULSEW	0	Wh 脉冲(WPULSE)发生器输入,使用外部脉冲发生时,由 MPU 更新。输出脉冲率为: <i>APULSEW</i> * F _S * 2 ⁻³² * <i>WRATE</i> * <i>X</i> * 2 ⁻¹⁴ . 该输入经过缓冲,可由 MPU 在转换间隔期间更新。更改在下一 个周期开始时生效。
0x46	WPULSE_CTR	0	WPULSE 输出计数。
0x47	WPULSE_FRAC	0	无符号分子,小数脉冲。该寄存器数值总是向下一个整脉冲累加 计数。
0x48	WSUM_ACCUM	0	WPULSE 的翻转累加器。
0x49	APULSER	0	VARh (VPULSE)脉冲发生器输入。
0x4A	VPULSE_CTR	0	VPULSE 输出计数。
0x4B	VPULSE_FRAC	0	无符号分子,小数脉冲。该寄存器总是向下一个脉冲计数。
0x4C	VSUM_ACCUM	0	VPULSE 的翻转累加器。

表 85. CE 脉冲参数

其它CE参数

表 86 所示 QUANT CE 参数用于抑制由于缩放和截断效应所引起的噪声。表 86 的底部提供了计算每个 QUANT 参数的 LSB 加权公式。

表 86. 用于噪声抑制和代码版本的 CE 参数

CE 地址	名称	默认值	说明
0x26	QUANT_IA	0	A 相电压、电流、有功能量和无功能量截断误差和噪声的补偿因
0x27	QUANT_WA	0	A 柏电压、电机、有功能重和无功能重截断决定和噪户的补偿因
0x28	QUANT_VARA	0	Jo
0x2A	QUANT_IB	0	D 扣的中区 由这 方式处量和工动处量积极温度和隔度的对例
0x2B	QUANT_WB	0	B 相的电压、电流、有功能量和无功能量截断误差和噪声的补偿 因子。
0x2C	QUANT_VARB	0	□ 1 ∘
0x2E	QUANT_IC	0	C相的电压、电流、有功能量和无功能量截断误差和噪声的补偿
0x2F	QUANT_WC	0	因子。
0x30	QUANT_VARC	0	
0x31	QUANT_ID	0	D相电流的截断误差和噪声补偿因子。

以下是在使用 71M6xx3 隔离传感器时各补偿参数的 LSB 加权:

$$QUANT _Ix _LSB = 5.20864 \cdot 10^{-10} \cdot IMAX^2 (Amps^2)$$

$$QUANT _Wx _LSB = 8.59147 \cdot 10^{-10} \cdot VMAX \cdot IMAX (Watts)$$

$$QUANT _VARx _LSB = 8.59147 \cdot 10^{-10} \cdot VMAX \cdot IMAX (Vars)$$

以下是在使用电流变压器(CT)时各补偿参数的 LSB 加权:

$$QUANT _Ix _LSB = 5.08656 \cdot 10^{-13} \cdot IMAX^2 (Amps^2)$$

$$QUANT _Wx _LSB = 1.04173 \cdot 10^{-9} \cdot VMAX \cdot IMAX (Watts)$$

$$QUANT_VARx_LSB = 1.04173 \cdot 10^{-9} \cdot VMAX \cdot IMAX (Vars)$$

5.4.10 CE校准参数

表 87 列出了通常输入用以影响电表校准精度的参数。

表 87. CE 校准参数

CE 地址	名称	默认 值	说明					
0x10	CAL_IA	16384						
0x11	CAL_VA	16384						
0x13	CAL_IB	16384	这些常量控制各自通道的增益,每个通道的标称值为 214 = 16384,					
0x14	CAL_VB	16384	每个通道的增益与 CAL 参数成正比。所以,如果通道增益减小					
0x16	CAL_IC	16384	1%,CAL 应增大 1% 。					
0x17	CAL_VC	16384						
0x19	CAL_ID	16384						
0x12	PHADJ_A	0	这些常数控制在使用本地传感器时的相位补偿。 $PHADJ_X = 0$ 时,不做补偿。当 $PHADJ_X$ 增大时,补偿量(滞后)增大。范围为 $\pm 2^{15} - 1$,如果将电流延迟 $φ$ 相位角,公式为:					
0x15	PHADJ_B	0	$PHADJ_X = 2^{20} \frac{0.029615TAN\Phi}{0.1714 - 0.0168 \cdot TAN\Phi}$, 60Hz 时					
0x18	PHADJ_C	0	$PHADJ_X = 2^{20} \frac{0.0206 \cdot TAN\Phi}{0.1430 - 0.01226 \cdot TAN\Phi}$,50Hz 时					
0x12	DLYADJ_A	0	使用远端隔离器时的相位补偿公式: $DLYADJ_X = \Delta_{\text{deg }rees} \left(1 + 0.1\Delta_{\text{deg }rees}\right) 2^{14} \frac{2\pi}{360} \frac{a^2 \cos^2\left(\frac{2\pi f}{f_s}\right) + 2ab \cos\left(\frac{2\pi f}{f_s}\right) + b}{c \sin\left(\frac{2\pi f}{f_s}\right)}$ 式中:					
0x15	DLYADJ_B	0	$a=2A$ $b=A^2+1$ $c=2A^2+4Acos\Big(rac{2\pi f}{f_s}\Big)+2$ f 为电网频率					
0x18	DLYADJ_C	0	f _s 为采样频率 下表为每个电流通道提供了 A 值:					

注:

固定方式下,电流传感器输入不指定给 A、B 和 C 相。A、B 和 C 相的分配取决于设计中 IADC0-1、IADC2-3、IADC4-5、IADC6-7 电流检测输入的连接方式。CE 代码必须知道这些连接。典型电表配置请参见图 31 和图 32。固定方式下,VADC8、VADC9 和 VADC10 分别指定给 VA、VB 和 VC。本表中所列 CE 地址指定给 A、B 和 C 相,与名称所示相符。

5.4.11 CE流程图

图 39 至图 41 所示为通过 CE 的数据流简图。未显示的功能包括:延迟补偿、采样内插、电压跌落检测、缩放和计量公式(EQU)处理。

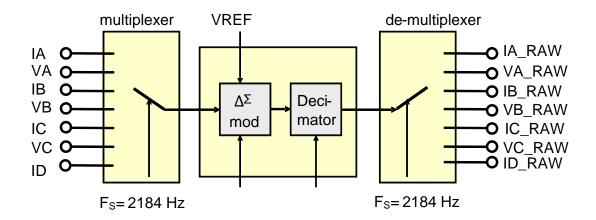


图 39. CE 数据流: 复用器和 ADC

图 40. CE 数据流: 单相的缩放、增益控制、中间变量

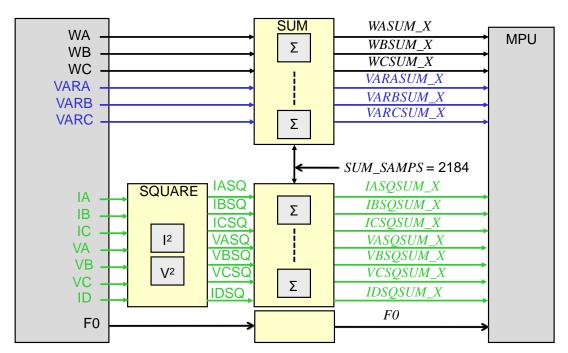


图 41. CE 数据流: 平方、求和运算级

6 71M6543 电气规格

本节介绍 71M6543 的电技术指标。关于 71M6xx3 的电技术指标、引脚输出和封装数据,请参阅 71M6xxx 的数据资料。

6.1 绝对最大额定值

表 88 列出了器件的绝对最大额定值。超出绝对最大额定值时,有可能会造成器件永久损坏。这些仅仅是耐压额定值,器件在这些条件下工作,或者在其它任何超出推荐工作条件(见第 6.3 节)的条件下工作都是不可取的。长时间工作在绝对最大额定值条件下,可能影响器件可靠性。以下所有电压以 GNDA 为基准。

表 88. 绝对最大额定值

电压和电流	
电源和地引脚	
V3P3SYS, V3P3A	-0.5 V 至+4.6 V
VBAT, VBAT_RTC	-0.5 V 至+4.6 V
GNDD	-0.1 V 至+0.1 V
模拟输出引脚	
VREF	-10 mA 至+10 mA, -0.5 V 至 V3P3A+0.5 V
VDD	-10 mA 至+10 mA, -0.5 至+3.0 V
V3P3D	-10 mA 至+10 mA, -0.5 V 至 4.6 V
VLCD	-10 mA 至+10 mA, -0.5 V 至+6 V
模拟输入引脚	•
IADC0, IADC1, IADC2, IADC3, IADC4, IADC5, IADC6, IADC7, VADC8, VADC9和 VADC10	-10 mA 至+10 mA -0.5 V 至 V3P3A+0.5 V
XIN, XOUT	-10 mA 至+10 mA -0.5 V 至+3.0 V
SEG 和 SEGDIO 引脚	•
配置为 SEG 或 COM 驱动	-1 mA 至+1 mA, -0.5 V 至 VLCD+0.5 V
配置为数字输入	-10 mA 至+10 mA, -0.5 V 至+6 V
配置为数字输出	-10 mA 至+10 mA, -0.5 V 至 V3P3D+0.5 V
数字引脚	•
输入(PB, RESET, RX, ICE_E, TEST)	-10 mA 至+10 mA, -0.5 至 6 V
输出(TX)	-10 mA 至+10 mA, -0.5 V 至 V3P3D+0.5 V
温度	l
工作结温(峰值,100ms)	140 °C
工作结温(连续)	125 °C
储存温度	-45 °C 至+165 °C
焊接温度—10 秒持续时间	250 °C

6.2 推荐外部元件

表 89. 推荐外部元件

名称	从	至	功能	值	单位
C1	V3P3A	GNDA	3.3V 电源旁路电容	≥0.1 ±20%	μF
C2	V3P3D	GNDD	3.3V 输出旁路电容	0.1 ±20%	μF
CSYS	V3P3SYS	GNDD	V3P3SYS 旁路电容	≥1.0 ±30%	μF
CVDD	VDD	GNDD	VDD 旁路电容	0.1 ±20%	μF
CVLCD	VLCD	GNDD	VLCD 旁路电容(使用电荷泵时)	≥0.1 ±20%	μF
XTAL	XIN	XOUT	32.768kHz 晶振—电气特性类似于 ECS .327-12.5-17X 或 Vishay XT26T, 负载电容 12.5pF。	32.768	kHz
CXS	XIN	GNDA	晶振负载电容,取决于晶振技术指标和电	15 ±10%	pF
CXL	XOUT	GNDA	路板寄生影响。标称值基于 4pF 电路板寄生电容和芯片电容容差。	10 ±10%	pF

6.3 推荐工作条件

除非另外说明,第 6.4 节性能指标和第 6.5 节时序规格所列的全部参数在表 90 给出的推荐工作条件范围内有效。

表 90. 推荐工作条件

参数	条件	最小值	典型值	最大值	単位
V3P3SYS 和 V3P3A 为精密表计工作提供电压(MSN 模式)。VBAT 和 VBAT_RTC 无电压。	VBAT=0V至 3.8V VBAT_RTC =0V至 3.8V	3.0		3.6	>
VBAT 电压(BRN 模式)。V3P3SYS 低于 2.8V 比较器门限。V3P3SYS 或 VBAT_RTC 必须足够高,以便为 RTC 模块供电。	V3P3SYS < 2.8V 和 Max (VBAT_RTC, V3P3SYS) > 2.0V	2.5		3.8	>
VBAT_RTC 电压。在 V3P3SYS < 2.0V 时 VBAT_RTC 对 RTC 和非易失存储器供电。	V3P3SYS<2.0V	2.0		3.8	V
工作温度		-40		+85	٥C

- 1. GNDA 和 GNDD 必须连接在一起。
- 2. V3P3SYS 和 V3P3A 必须连接在一起。

6.4 性能指标

6.4.1 输入逻辑电平

表 91. 输入逻辑电平

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
数字高电平输入电压 ¹ ,V _{IH}		2			V
数字低电平输入电压 ¹ , V _{IL}				0.8	V
输入上拉电流,IIL E_RXTX, E_RST, E_TCLK OPT_RX, OPT_TX SPI_CSZ (SEGDIO36) 其它数字输入	VIN=0 V, ICE_E=3.3 V	10 10 10 -1	0	100 100 100 1	4 4 4 4 4 4 4
输入下拉电流,IIH ICE_E, RESET, TEST 其它数字输入	VIN=V3P3D	10 -1	0	100 1	μΑ μΑ

注:

1. 电池供电模式下,数字输入应低于 0.1V 或高于 VBAT – 0.1V,将电池电流降至最小。

6.4.2 输出逻辑电平

表 92. 输出逻辑电平

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
	$I_{LOAD} = 1 \text{ mA}$	V3P3D-0.4			V
数字高电平输出电压, V _{OH}	$I_{LOAD} = 15 \text{ mA}$	V3P3D-0.6			V
	(见注释 1、2)				
数字低电平输出电压,VoL	$I_{LOAD} = 1 \text{ mA}$	0		0.4	V
	$I_{LOAD} = 15 \text{ mA}$	0		8.0	V
	(见注释 1)				

- 1. 由设计保证,非产品测试。
- 2. **注意:** 全部上拉电流之和必须与内部 V3P3D 开关的导通电阻匹配。请参见第 139 页第 6.4.6 节 V3P3D 开关。

6.4.3 电池监测器

表 93. 电池监测器技术指标(TEMP_BAT = 1)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单 位
BV: 电池电压(定义)	MSN 模式, <i>TEMP_PWR</i> = 1 BRN 模式, <i>TEMP_PWR=TEMP_BSEL</i>	BV = 3.3V + (BSENSE - BV) = 3.291V + (BSENSE)	•	•	V
测量误差 $100 \cdot \left(\frac{BV}{VBAT} - 1\right)$	VBAT = 2.0 V 2.5 V 3.0 V 4.0 V	-7.5 -5 -3 -3		7.5 5 3 5	% % %
输入阻抗,连续测量,MSN 模式。 V(VBAT_RTC)/I(VBAT_RTC)	V3P3 = 3.3 V, TEMP_BSEL = 0, TEMP_PER = 111, VBAT_RTC = 3.6 V,	1			МΩ
施加到 BCURR 的负载 IBAT(BCURR=1) - IBAT(BCURR=0)	V3P3 = 3.3 V	50	100	140	μΑ

6.4.4 温度监测器

表 94. 温度监测器

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位	
71M6543F 和 71M6543G 温度测	MSN 模式下,TEMP_PWR=1	:				
量公式	Temp = 0).325 · <i>STEMI</i>	P + 22			
(见注释 2 和 4)	BRN 模式下, <i>TEMP_PWR</i> = 7	TEMP_BSEL:				
	$Temp = 0.325 \cdot STEMP + 0.00$		² − 0.609 · <i>BSEN</i>	<i>ISE</i> + 64.4		
71M6543H 和 71M6543GH 温度测	MSN 模式下,TEMP_PWR=1	:				
量公式	如果 <i>STEMP</i> ≤ 0:					
(见注释 3 和 4)	Temp = 0	$Temp = 0.325 \cdot STEMP + 22$				
	如果 STEMP > 0:	如果 STEMP > 0:				
	Temp =	°C				
	BRN 模式下, <i>TEMP_PWR</i> = 7					
	如果 <i>TEMP</i> ≤ 0:					
	$Temp = 0.325 \cdot STEMP + 0.00$)218 · BSENSE	$^2 - 0.609 \cdot BSEN$	<i>ISE</i> + 64.4		
	如果 STEMP > 0:					
	$Temp = \frac{63 \cdot STEMP}{TEMP_85} + 0.002$	18 · BSENSE ² ·	– 0.609 · <i>BSENS</i>	SE + 64.4		
温度误差(71M6543)	T _A = 22°C	-2		2	°C	
(见注释 1)		-2		2	J	
VBAT_RTC 电荷/测量	TEMP_BSEL = 0, TEMP_PWR=0, SLP Mode, VBAT_RTC = 3.6 V		16		μC	
设置 <i>TEMP_START</i> 之后温度测量的 持续时间 (见注释 1)			15	60	ms	

- 1. 由设计保证,未经产品测试。
- 2. 对于 71M6543F 和 71M6543G, TEMP_85 熔丝值为 0。.
- 3. 对于 71M6543H 和 71M6543GH, TEMP_85 熔丝值 ≠ 0。
- 4. 这些公式中的系数为典型值。

6.4.5 电源电流

表 95 中提供的供电电流仅包括 71M6543 消耗的电流。关于使用 71M6xx3 远端传感器时需要的额外电流,请参阅 71M6xxx 数据资料。

表 95. 电源电流指标

参数	条件	器件	最小值	典型值	最大值	单位
I1: V3P3A + V3P3SYS 电流,正常工	多相: 4 路电流, 3 路电压 V3P3A = V3P3SYS = 3.3 V, MPU_DIV [2:0]= 3 (614 kHz MPU 时钟),	71M6543F/H		7.2	8.5	mA
作	无 FLASH 写操作 RTM_E=0, PRE_E=0, CE_E=1, ADC_E=1, ADC_DIV=0, MUX_DIV[3:0]=7, FIR_LEN[1:0]=1, PLL_FAST=1	71M6543G/GH		7.5	8.8	ША
I1a: V3P3A + V3P3SYS 电流,ADC 半	除 <i>ADC_DIV=</i> 1、 <i>FIR_LEN=</i> 0 外,同 l1	71M6543F/H		6.4	7.3	mA
速(ADC_DIV=1)		71M6543G/GH		6.7	7.7	IIIA
I1b: V3P3A + V3P3SYS 电流,正常工 作	除 <i>PLL_FAST</i> = 0 外,同 l1	71M6543F/H		2.9	3.8	mA
PLL_FAST=0		71M6543G/GH		3.0	3.9	
I1c: V3P3A + V3P3SYS 电流,正常工	VA DDC C 4 // El /4	71M6543F/H		7.3	8.7	A
作 PRE_E=1	除 <i>PRE_E</i> = 1 外,同 l1			7.7	9.1	mA
I1d: V3P3A + V3P3SYS 电流,正常工 作	除 PRE_E=1、 ADC_DIV=1、 FIR_LEN=0 外, 同 I1	71M6543F/H		6.5	7.5	mA
PRE_E=1, ADC_DIV=1, FIR_LEN=0. (见注释 1)		71M6543G/GH		6.9	7.9	IIIA
I1e: V3P3A + V3P3SYS 电流,正常工		71M6543F/H		3.0	3.9	
作 PLL_FAST=0, PRE_E=1. (见注释 1)	除 <i>PRE_E</i> =1、 <i>PLL_FAST</i> =0 外,同 l1	71M6543G/GH		3.1	3.9	• mA
12:	除 $MPU_DIV[2:0]$ 变动外,同 I $I_{MPU_DIV=0}$ $-I_{MPU_DIV=3}$	71M6543F/H		0.4	0.6	mA/
V3P3A + V3P3SYS 动态电流	4.3	71M6543G/GH		0.5	0.65	MHz
VBAT 电流 I3: MSN 模式 I4: BRN 模式 I5: LCD 模式(ext. VLCD) I6: LCD 模式(boost, DAC) I7: LCD 模式(DAC) I8: LCD 模式(VBAT) I9: SLP 模式	CE_E=0 LCD_VMODE[I:0]=3, 参见注释 3 LCD_VMODE[I:0]=2, 参见注释 1、2 LCD_VMODE[I:0]=1, 参见注释 1、2 LCD_VMODE[I:0]=0, 参见注释 1、2 SLP 模式	71M6543 71M6543F/H 71M6543G/GH 71M6543 71M6543 71M6543 71M6543 71M6543	-300	0 2.4 2.6 0.4 24 3.0 1.1	300 3.2 3.5 108 36 11 3.4 +300	nA mA mA nA µA µA µA
VBAT_RTC 电流 I10: MSN 模式 I11: BRN 模式 I12: LCD 模式 I13: SLP 模式 I14: SLP 模式(见注释 1)	<i>LCD_VMODE[1:0]</i> =2、参见注释 3 T _A ≤ 25 °C T _A = 85 °C	71M6543 71M6543F/G 71M6543G/GH 71M6543 71M6543 71M6543	-300	0 240 260 1.8 0.7 1.5	300 410 420 4.1 1.7 3.2	nA nA nA µA µA µA
I15: V3P3A + V3P3SYS 电流,	除了以最大速率写 FLASH、CE_E=0、ADC_E=0 外,同	71M6543F/G		7.1	8.7	mA
通过 ICE 写 FLASH	11	71M6543G/GH		7.3	8.7	

- 1. 由设计保证,非产品测试。
- 2. $LCD_DAC[4:0]$ =5 (2.9V)、 $LCD_CLK[1:0]$ =2、 $LCD_MODE[2:0]$ =6,所有 LCD_MAPn 位 = 0。
- 3. LCD_DAC[4:0]=5 (2.9V)、LCD_CLK[1:0]=2、LCD_MODE[2:0]=6、LCD_BLANK=0、LCD_ON=1,所有 LCD_MAPn位=1,并且 VLCD 引脚=3.3V。

6.4.6 V3P3D开关

表 96. V3P3D 开关性能指标

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
导通电阻 – V3P3SYS 至 V3P3D	I _{V3P3D} ≤ 1 mA			10	Ω
导通电阻 – VBAT 至 V3P3D	I _{V3P3D} ≤ 1 mA, VBAT>2.5V			10	Ω
V3P3D I _{OH} , MSN	V3P3SYS = 3V V3P3D = 2.9V	10			mA
V3P3D I _{OH} , BRN	VBAT = 2.6V V3P3D = 2.5V	10			mA

6.4.7 内部电源故障比较器

表 97. 内部电源故障比较器性能指标

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
总响应时间	100mV 过载,下降 100mV 过载,上升	20		200 200	μ s μ s
下降门限 3.0V 比较器 2.8V 比较器 3.0V 和 2.8V 差分比较器	V3P3下降	2.83 2.75 50	2.93 2.81 136	3.03 2.87 220	V V mV
下降门限 2.25V 比较器 2.0V 比较器 VDD (@VBAT=3.0V) – 2.25V 比较器 2.25V 和 2.0V 差分比较器	VDD 下降	2.2 1.90 0.25 0.15	2.25 2.00 0.35 0.25	2.5 2.20 0.45 0.35	>>>>
滞回(上升门限 - 下降门限)3.0V 比较器2.8V 比较器2.25V 比较器2.0V 比较器	T _A = 22 °C	22 25 10 10	45 42 33 28	65 60 60 60	mV mV mV

6.4.8 2.5 V稳压器—系统电源

表 98. 2.5V 稳压器性能指标

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V2P5	V3P3 = 3.0 V - 3.8 V ILOAD = 0 mA	2.55	2.65	2.75	V
V2P5 负载调整率	V3P3 = 3.3 V ILOAD = 0 mA 至 5 mA			40	mV
压差 V3P3SYS-V2P5	ILOAD = 5 mA, 减小 V3P3D,直到 V2P5 下降 200mV			440	mV

6.4.9 2.5 V稳压器—电池供电

表 99. 低功耗稳压器性能指标

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V2P5	VBAT = 3.0 V - 3.8 V, V3P3 = 0 V, ILOAD = 0 mA	2.55	2.65	2.75	V
V2P5 负载调整率	VBAT = 3.3 V, V3P3 = 0 V, ILOAD = 0 mA 至 1 mA			40	mV
压差 2V - VBAT-VDD	ILOAD = 0mA, VBAT = 2.0 V, V3P3 = 0 V.			200	mV

6.4.10 晶振

表 100. 晶振性能指标

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
至晶振的最大输出功率	晶振断开,见注释 1			1	μW
XIN 至 XOUT 电容(见注释 1)				3	pF
XOUT 电容变化	RTC_ADJ = 7F 至 0, 偏压 = 不偏压, Vpp = 0.1V		15		pF
注: 1. 由设计保证,非产品测试。					

6.4.11 锁相环(PLL)

表 101. PLL 性能指标

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
PLL 上电稳定时间	PLL_FAST =0, V3P3 = 0 至 3.3V 步进,测得 MCK 第一个沿的时间 (TMUX2OUT 引脚)		3		ms
PLL_FAST 稳定时间 PLL_FAST 上升 PLL_FAST 下降	V3P3=0, VBAT=3.8 至 2.0 V		3		ms ms
PLL SLP 至 MSN 稳定时间	PLL_FAST=0		3		ms

6.4.12 LCD 驱动器

表 102. LCD 驱动器性能指标

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VLCD 电流	VLCD=3.3,全部 LCD 映射位=0			2	uA
	VLCD=5.0,全部 LCD 映射位=0			3	uA

- 1. 这些技术指标适用于所有 COM 和 SEG 引脚。
- 2. LCD_VMODE=3, LCD_ON=1, LCD_BLANK=0, LCD_MODE=6, LCD_CLK=2.
- **3**. 输出负载为每 **SEG** 和 **COM** 引脚 **74pF**。

6.4.13 VLCD发生器

表 103. VLCD 发生器技术指标

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VSYS 至 VLCD 开关阻抗	V3P3 = 3.3 V, RVLCD=断开, <i>LCD_BAT</i> =0, <i>LCD_VMODE[1:0]</i> =0, ΔILCD=10 μA			750	Ω
VBAT 至 VLCD 开关阻抗	V3P3 = 0 V, VBAT = 2.5 V, RVLCD =断开, <i>LCD_BAT</i> =1, <i>LCD_VMODE[1:0]</i> =0, ΔILCD=10 μA			700	Ω
LCD 升压频率	LCD_VMODE[1:0] = 2, RVLCD =断开, CVLCD =断开 PLL_FAST=1 PLL_FAST=0		820 786		kHz kHz
VLCD IOH 电流 (VLCD(0)-VLCD(IOH)<0.25)	LCD_VMODE[1:0] = 2, LCD_CLK[1:0] = 2, RVLCD =断开, V3P3 = 3.3V, LCD_DAC[4:0] = 1F	10			μΑ

从 LCDADJ0 和 LCDADJ12 熔丝:

$$LCDADJ12$$
 熔丝: $LCDADJ0 + \frac{LCDADJ12 - LCDADJ0}{12} LCD_DAC$ $VLCD_{NOM}(LCD_DAC) = 2.65 + 2.65 \frac{LCD_DAC}{31} + LCDADJ(LCD_DAC)$ 经完工 CD_DAC 值下的 VLCD 标称值,以下技术指标列出实际 VLCD 和 VLCD

以上公式说明指定 LCD_DAC 值下的 VLCD 标称值。以下技术指标列出实际 VLCD 和 VLCDnom 之间的 最大偏差。注意, VCC 和升压足够时, LCD DAC 不会达到其目标值,将发生大的负误差。

取八個左。在念, VOO 和	,LODDATA是到来自你值,不	リ 及エハ	可外风生	0	
LCD_DAC 误差。 VLCD-VLCDnom 满幅,升压 V3P3 =3.6 V V3P3 =3.0 V VBAT=4.0 V, V3P3=0, BRN 模式 VBAT=2.5 V, V3P3=0, BRN 模式	LCD_VMODE = 10, LCD_DAC[4:0] = 1F, LCD_CLK[1:0]=2, LCD_MODE[2:0]=6	-0.15 -0.4 -0.15 -1.3		0.15 0.15 0.15	> > > >
<i>LCD_DAC</i> 误差。VLCD-VLCDnom DAC=12,升压 V3P3 = 3.6 V V3P3 = 3.0 V VBAT = 2.5 V, V3P3 = 0 V, BRN 模式	LCD_VMODE = 10, LCD_DAC[4:0] = C, LCD_CLK[1:0]=2, LCD_MODE[2:0]=6	-0.15 -0.15 -0.15		0.15 0.15 0.15	V V V
<i>LCD_DAC</i> 误差。VLCD-VLCDnom 零幅,升压 V3P3 = 3.6 V V3P3 = 3.0 V VBAT = 4.0 V, V3P3 = 0 V, BRN 模式 VBAT = 2.5 V, V3P3 = 0 V, BRN 模式	LCD_VMODE = 2, LCD_DAC[4:0] = 0, LCD_CLK[1:0]=2, LCD_MODE[2:0]=6	-0.15 -0.15 -0.15 -0.15		0.15 0.15 0.15 0.15	> > > >
LCD_DAC 误差。VLCD-VLCDnom 满幅,无升压 V3P3 = 3.6 V (见注释 1) V3P3 = 3.0 V (见注释 1) VBAT = 4.0 V, V3P3 = 0 V, BRN 模式 VBAT = 2.5 V, V3P3 = 0 V, BRN 模式	LCD_VMODE = 1, LCD_DAC[4:0] = 1F, LCD_CLK[1:0]=2, LCD_MODE[2:0]=6	-2.1 -2.8 -1.8 -3.2			>>>>

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
LCD_DAC 误差。VLCD-VLCDnom DAC=12,无升压 V3P3 = 3.6 V V3P3 = 3.0 V VBAT = 4.0 V, V3P3 = 0 V, BRN 模式 VBAT = 2.5 V, V3P3 = 0 V, BRN 模式	LCD_VMODE = 1, LCD_DAC[4:0] = C, LCD_CLK[1:0]=2, LCD_MODE[2:0]=6	-0.5 -1.1 -0.15 ¹ -1.5 ¹		0.15 ¹	V V V
LCD_DAC 误差。 VLCD-VLCDnom 零幅,无升压 t V3P3 = 3.6 V V3P3 = 3.0 V VBAT = 4.0 V, V3P3 = 0 V, BRN 模式 VBAT = 2.5 V, V3P3 = 0 V, BRN 模式	LCD_VMODE = 01, LCD_DAC[4:0] = 0, LCD_CLK[1:0]=2, LCD_MODE[2:0]=6	-0.15 -0.15 -0.15 -0.45		0.15 0.15 0.15 0.15	V V V
LCD_DAC 误差。VLCD-VLCDnom 满幅,升压,LCD 模式 VBAT = 4.0 V, V3P3 = 0 V VBAT = 2.5 V, V3P3 = 0 V	LCD_VMODE = 1, LCD_DAC[4:0] = 1F, LCD_CLK[1:0]=2, LCD_MODE[2:0]=6	-0.15 -1.3		0.15	> >

- 1. 由设计保证,非产品测试。
- **2.** 以下测试条件也适用于本表中提供的全部技术指标:旁路电容 CVLCD ≥ 0.1μF,测试负载 RVLCD = 500kΩ,无显示,全部 SEGDIO 引脚配置为 DIO。

6.4.14 71M6543 VREF

表 104 所示为 71M6543 ADC 基准电压(VREF)的性能技术指标。

表 104. 71M6543 VREF 性能指标

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VREF 输出电压,VREF(22)	T _A = 22 °C	1.193	1.195	1.197	V
VREF 输出电压,VREF(22)	PLL_FAST=0		1.195		V
VREF 斩波步距,调节	VREF(CHOP=01) - VREF(CHOP=10)	-10		10	mV
VREF 电源灵敏度 ΔVREF / ΔV3P3A	V3P3A = 3.0 至 3.6 V	-1.5		1.5	mV/V
VREF 输入阻抗	VREF_DIS = 1, VREF = 1.3 V 至 1.7 V	100			kΩ
VREF 输出阻抗	$VREF_CAL = 1$, ILOAD = 10 μ A, -10 μ A			3.2	kΩ
VNOM 定义(见注释 2)	VNOM(T) = VREF(22) + (T -	22) <i>TC</i> 1+	$(T-22)^2$	TC2	V
如果温度特性	- 上调整信息可用(71M6543H 和 71	M6543GH	l, 0.1%)		
VNOM 温度系数: TC1 = TC2 =	35.091+0.01764·TRIMT+1.587·(TRIMBGB – TRIMBGD)				
	$-0.557 - 2.8 \cdot 1$	IU · I KII	VI I	1	μV/°C ²
VREF(T) 相对于 VNOM(T)的偏差(见注释 1): $\frac{VREF(T) - VNOM(T)}{VNOM(T)} \frac{10^6}{62}$		-10		+10	ppm/°C
如果温度特性	:调整信息不可用(71M6543F 和 7	71M6543G	6 , 0.5%)		
VNOM 温度系数: TC1 = TC2 =	$275 - 4.95 \cdot TRIMT \\ -0.557 + 0.00028 \cdot TRIMT$				
VREF(T) 相对于 VNOM(T)的偏差(见注释 1): VREF(T) - VNOM(T) 10 ⁶ VNOM(T) 62		-40		+40	ppm/°C
VREF 老化			±25		ppm/ year

- 1. 由设计保证,非产品测试。
- 2. 该关系式描述了 VREF 在不同温度点的归一化特性,由 TC1 和 TC2 的 1 阶、2 阶的 2 次多项式 表示。
- 3. 除非特别说明,以下测试条件适用于本表中的所有参数: VREF_DIS = 0、PLL_FAST=1

6.4.15 ADC转换器

表 105. ADC 转换器性能指标

参数	条件	最小 值	典型值	最大 值	单位
推荐输入范围 (Vin - V3P3A)		-250		250	mV peak
电压至电流串扰 $\frac{10^6*Vcrosstalk}{Vin}\cos(\angle Vin-\angle Vcrosstalk)$ (见注释 1)	Vin = 200 mV 峰值, 65 Hz, on VADC8 (VA)或 VADC9 (VB)或 VADC10 (VC). Vcrosstalk = IADC0-1 或 IADC2-3 或 IADC4-5 或 IADC6-7 上的最大测量值	-10		10	μV/V
输入阻抗,无前置放大器	Vin=65 Hz	40		90	kΩ
ADC 增益误差与%电源偏差变动 $\frac{10^6 \Delta Nout_{PK} 357 nV / V_{IN}}{100 \Delta V 3P3A/3.3}$	Vin=200 mV pk, 65 Hz V3P3A=3.0 V, 3.6 V			50	ppm / %
输入偏移 IADC0=IADC1=V3P3A IADC0=V3P3A	DIFF0_E=1, PRE_E=0 DIFF0_E=0, PRE_E=0	-10 -10		10 10	mV mV
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	V _{IN} = 65Hz, 250mVpk, 64kpts FFT, Blackman Harris 窗		A B -82 C C D -84 E F -83 G H -86 J	A -75 B -75 C -75 D -75 E -75 F -75 G -75 G -75 J -75	dB
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	V _{IN} = 65Hz, 20mVpk, 64kpts FFT, Blackman Harris 窗		A -85 B -91 C -85 D -91 E -93 F -85 G -85 H -91 J -93		dB
LSB 大小: Name	Vin=65Hz, 20mVpk, 64kpts FFT, Blackman- Harris 窗		A 3470 B 406 C 3040 D 357 E 151 F 3470 G 3040 H 357 J 151		nV
数字满幅: Name			A: ±91125 B: ±778688 C: ±103823 D: ±884736 E: ±2097152 F: ±91125 G: ±103823 H: ±884736 J: ±2097152		LSB

参数	条件	最小 值	典型值	最 大 值	单位
----	----	---------	-----	-----------------	----

注:

- 1. 由设计保证,非产品测试。
- 2. 除非特别说明,以下测试条件适用于本表中的全部参数:*FIR_LEN[1:0]*=1,*VREF_DIS*=0, *PLL_FAST*=1,*ADC_DIV*=0,*MUX_DIV*=6,LSB 值不包括 CE 输入处的 9 位左移位。

6.4.16 IADC0-IADC1 的前置放大器

表 106. 前置放大器性能指标

参数	条件	最小值	典型值	最 大 值	単位
差分增益 Vin=30mV 差分 Vin=15mV 差分(见注释 1)	T _A = 5°C, V3P3=3.3 V, PRE_E=1, FIR_LEN=2, DIFF0_E=1, 2520Hz 采样速率	7.8 7.8	7.92 7.92	8.0 8.0	V/V V/V
增益随 V3P3 的变化 Vin=30mV 差分(见注释 1)	V3P3 = 2.97 V, 3.63 V	-100		100	ppm/%
增益随温度的变化 Vin=30mV 差分(见注释 1)	T _A = -40°C, 85°C	10	-25	-80	ppm/C
相位偏移 Vin=30mV 差分(见注释 1)	T _A =25°C, V3P3=3.3 V	-6		6	mº
前置放大器输入电流 IADC0 IADC1	PRE_E=1, FIR_LEN=10, DIFF0_E=1 2520Hz 采样速率 IADC0=IADC1=V3P3	4 4	თ თ	16 16	uA uA
前置放大器+ADC THD Vin=30mV 差分 Vin=15mV 差分	T _A =25°C, V3P3=3.3 V, PRE_E=1, FIR_LEN=2, DIFF0_E=1, 2520Hz 采样速率		-82 -86		dB dB
前置放大器失调 IADC0=IADC1=V3P3+30mV IADC0=IADC1= V3P3+15mV IADC0=IADC1= V3P3 IADC0=IADC1= V3P3-15mV IADC0=IADC1= V3P3-30mV 注:	T _A =25°C, V3P3=3.3 V, PRE_E=1, FIR_LEN=10, DIFF0_E=1, 2520Hz 采样速率		-0.63 -0.57 -0.56 -0.56 -0.55		mV mV mV mV

1. 由设计保证,非产品测试。

6.5 时序规格

6.5.1 闪存

表 107. 闪存时序指标

参数	条件	最小值	典型 值	最大值	単位
闪存写循环	-40 °C 至+85 °C	20,000			循环
闪存数据保持	25 °C 85 °C	100 10			年
页或整体擦除之间的闪存字节写				2	循环
写时间/字节				21	μs
页擦除(1024 字节)				21	ms
整体擦除				21	ms

6.5.2 SPI从机

表 108. SPI 从机时序指标

参数	条件	最小值	典型 值	最大值	单位
SPI 建立时间	SPI_DI 至 SPI_CK 上升	10			ns
SPI 保持时间	SPI_CK 上升至 SPI_DI	10			ns
SPI 输出延迟	SPI_CK 下降至 SPI_D0			40	ns
SPI 恢复时间	SPI_CSZ 下降至 SPI_CK	10			ns
SPI 断开时间	SPI_CK 至 SPI_CSZ 上升	15			ns
SPI 时钟高电平		40			ns
SPI 时钟低电平		40			ns
SPI时钟频率	SPI 频率/MPU 频率			2.0	MHz/MHz
SPI 通信间隔	SPI_CSZ 上升至 SPI_CSZ 下降	4.5			MPU 周期

6.5.3 EEPROM接口

表 109. EEPROM 接口时序

参数	条件	最小值	典型 值	最大值	单位
_	CKMPU = 4.9 MHz, 使 用中断		310		kHz
写时钟频率(I ² C)	CKMPU = 4.9 MHz, 逐位仿真 DIO2/3 PLL_FAST = 0		100		kHz
写时钟频率(3线)	CKMPU = 4.9 MHz PLL_FAST = 0 PLL_FAST = 1		160 500		kHz

6.5.4 RESET引脚

表 110. RESET 引脚时序

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
复位脉冲宽度		5			μs
复位脉冲下降时间(见注释 1)				1	μs
注: 1. 由设计保证,非产品测试。					

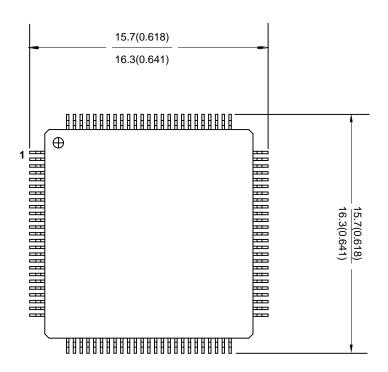
6.5.5 实时时钟(RTC)

表 111. RTC 的日期范围

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
日期范围		2000	-	2255	年

6.6 100 引脚LQFP封装图

尺寸单位为 mm。



Top View

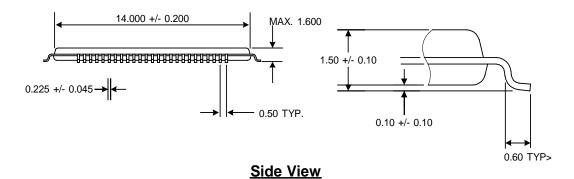


图 42. 100 引脚 LQFP 封装图

6.7 71M6543 引脚图

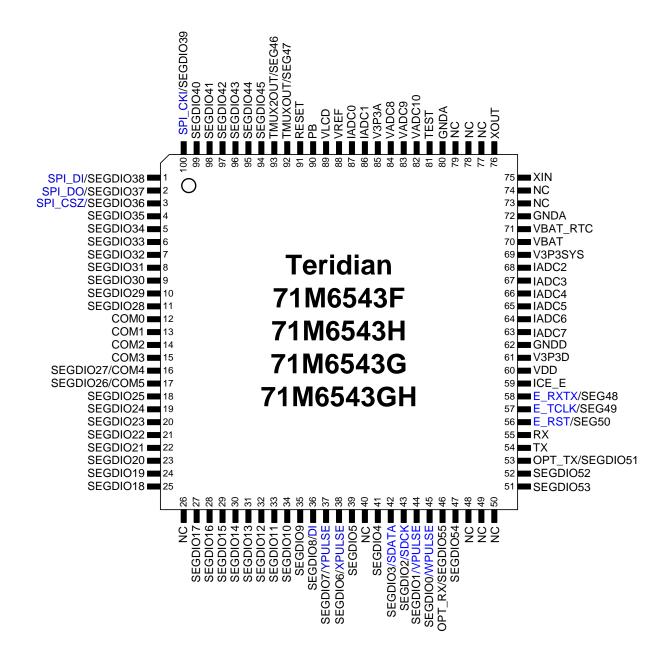


图 43. LQFP-100 封装引脚排列

6.8 71M6543 引脚说明

6.8.1 71M6543 电源和接地引脚

引脚类型: P = 电源, O = 输出, I = 输入, I/O = 输入/输出。电路编号表示等效电路,如第 6.8.4 节的 <math>I/O 等效电路。

表 112. 71M6543 电源和接地引脚

引脚	名称	类型	电路	功能
72, 80	GNDA	Р	_	模拟地。该引脚应直接连接至接地区域。
62	GNDD	Р		数字地。该引脚应直接连接至接地区域。
85	V3P3A	Р		模拟电源。将一路 3.3V 电源连接至该引脚。V3P3A 必须与 V3P3SYS 电压相同。
69	V3P3SYS	Р	_	系统 3.3V 电源,该引脚连接至 3.3V 电源。
61	V3P3D	0	13	芯片辅助电压输出。MSN 模式下,该引脚通过内部选择开关连接至 V3P3SYS; BRN 模式下,内部连接至 VBAT; LCD 和休眠模式下,V3P3D 浮空。引脚和地之间的旁路电容不应大于0.1μF。
60	VDD	0	_	2.5V 稳压器输出。MSN 和 BRN 模式下,该引脚供电。在该引脚和地之间连接 0.1μF 旁路电容。
89	VLCD	0	_	LCD DAC 输出。在该引脚和地之间连接 0.1µF 旁路电容。
70	VBAT	Р	12	备份电池引脚,支持电池模式(BRN、LCD)。VBAT 和 GNDD 之间连接电池或超级电容。如果未使用电池,将 VBAT 连接至 V3P3SYS。
71	VBAT_RTC	Р	12	RTC 和振荡器电源。VBAT 和 GNDD 之间接电池或超级电容。 如果未使用电池,将 VBAT_RTC 连接至 V3P3SYS。

6.8.2 71M6543 模拟电路引脚

引脚类型: P=电源, O=输出, I=输入, I/O=输入/输出。电表编号表示等效电路, 如第 6.8.4 节所述。

表 113. 71M6543 模拟电路引脚

引脚	名称	类型	电路	功能	
87 86	IADC0 IADC1			差分或单端电网电流检测输入。这些引脚为电压输入,至内部 A/D 转换器。通常情况下,连接至电流传感器输出。未使	
68 67	IADC2 IADC3	l 6	I	用的引脚必须连接至 V3P3A 。 配置为差分输入时(即置位 <i>DIFFx_E</i> 控制位, 其中 x = 0、2、4、6), 引脚配对构成差分输入对: IADC0-IADC1、IADC2-IADC3、IADC4-IADC5 和 IADC6-IADC7。	
66 65	IADC4 IADC5			IADC2-IADC3、IADC4-IADC5 和 IADC6-IADC7。	
64 63	IADC6 IADC7				脚构成数字平衡对,用于与 71M6xx3 远端隔离传感器进行 双向通信。
84	VADC8 (VA)			电网电压检测输入:这些引脚为电压输入,送入内部 A/D 转	
83	VADC9 (VB)	ı	6	6	换器。通常情况下,连接到电阻分压输出。 未使用的引脚必
82	VADC10 (VC)			须连接至 V3P3A 。	
88	VREF	0	9	ADC 电压基准。该引脚应保持浮空,同时将 VREF_CAL 清 0。	
75	XIN	I	8	晶振输入:在这些引脚之间应连接 32kHz 晶体。通常情况下,在 XIN 和 GNDA 之间连接 15pF 电容,在 XOUT 和GNDA 之间连接 10pF 电容。将这些引脚之间的电容最小化	
76	76 XOUT		0	非常重要,详细信息请参见晶体制造商的数据资料。如果使用外部时钟,应将 150mV (p-p)时钟信号加至 XIN, XOUT 应保持浮空。	

6.8.3 71M6543 数字电路引脚

引脚类型: P =电源,O =输出,I =输入,I/O =输入/输出,N/C =没有连接。电路编号表示等效电路,参见第 6.8.4 节所述。

表 114. 71M6543 数字电路引脚

引脚	名称	类型	电路	功能	
12–15	COM0-COM3	0	5	LCD 共用输出,这四个引脚为 LCD 显示提供选择信号。	
45	SEGDIO0/WPULSE				
44	SEGDIO1/VPULSE				
43	SEGDIO2/SDCK				
42	SEGDIO3/SDATA				
41	SEGDIO4			 多功能引脚,配置为 LCD 段驱动器或 DIO。复用功能引脚	
39	SEGDIO5			(需要配置相关 I/O RAM 寄存器启用):	
38	SEGDIO6/XPULSE			SEGDIO0 = WPULSE (45) SEGDIO1 = VPULSE (44)	
37	SEGDIO7/YPULSE	1/0	2.4.5	SEGDIO2 = SDCK (43)	
36	SEGDIO8/DI	I/O	3, 4, 5	SEGDIO3 = SDATA (42) SEGDIO6 = XPULSE (38)	
35–27	SEGDIO[9:17]			SEGDIO7 = YPULSE (37) SEGDIO8 = DI (36)	
25–18	SEGDIO[18:25]			, ,	
11–4	SEGDIO[28:35]		未使用的引脚必须配置为输出或端接至 N	未使用的引脚必须配置为输出或端据 ————————————————————————————————————	未使用的引脚必须配置为输出或端接至 V3P3/GNDD。
99–94	SEGDIO[40:45]				
52	SEGDIO52				
51	SEGDIO53				
47	SEGDIO54				
17	SEGDIO26/COM5	1/0	2.4.5	多功能引脚,配置为 LCD 段驱动器或第二功能 DIO (LCD	
16	SEGDIO27/COM4	I/O	3, 4, 5	共用驱动器)。	
3	SPI_CSZ/SEGDIO36				
2	SPI_DO/SEGDIO37	I/O	3, 4, 5	多功能引脚,配置为 LCD 段驱动器或第二功能 DIO (SPI 接	
1	SPI_DI/SEGDIO38	1/0	3, 4, 5	口)。	
100	SPI_CKI/SEGDIO39				
53	OPT_TX/SEGDIO51	I/O	3 1 5	多功能引脚,配置为 LCD 段驱动器或第二功能 DIO (光端口	
46	OPT_RX/SEGDIO55	1/0	3, 4, 5	/UART1)。	
58	E_RXTX/SEG48	I/O	1, 4, 5	多功能引脚,配置为仿真端口(ICE_E 拉高时)或 LCD 段驱动	
56	E_RST/SEG50			多切能力解,能量为仍其编句(IOL_L 並同时)或 EOD 技能切 器(ICE_E 接 GND)。	
57	E_TCLK/SEG49	0	4, 5	, – ,	
59	ICE_E	I	2	ICE 使能。为低电平时,E_RST、E_TCLK 和 E_RXTX 分别变为 SEG50、SEG49 和 SEG48。对于生产单元,该引脚应拉低至 GND,禁用仿真端口。	
92	TMUXOUT/SEG47	0	4, 5	多功能引脚。配置为复用器/时钟输出或 LCD 段驱动器(使用	
93	TMUX2OUT/SEG46		7, 3	I/O RAM 寄存器)。	

引脚	名称	类型	电路	功能
91	RESET	I	2	芯片复位引脚,高有效。该输入引脚用于将芯片复位至已知 状态。为正常工作,该引脚拉低。该引脚具有内部 30μA (标 称值)电流源拉低。无需外部复位电路。
55	RX	I	3	UARTO 输入。如果不使用该引脚,必须将其端接至 V3P3D 或 GNDD。
54	TX	0	4	UARTO 输出。
81	TEST	I	7	芯片生产测试引脚, 正常工作时,该引脚必须接地。
90	РВ	ı	3	按键输入。不使用时接地。上升沿置位 WF_PB 标识。如果器件处于 SLP 或 LCD 模式,亦使器件唤醒。PB 没有内部上拉或下拉电阻。
26, 40, 48, 49, 50, 73, 74, 77, 78, 79	NC	N/C	_	未连接。请勿连接该引脚。

6.8.4 I/O等效电路

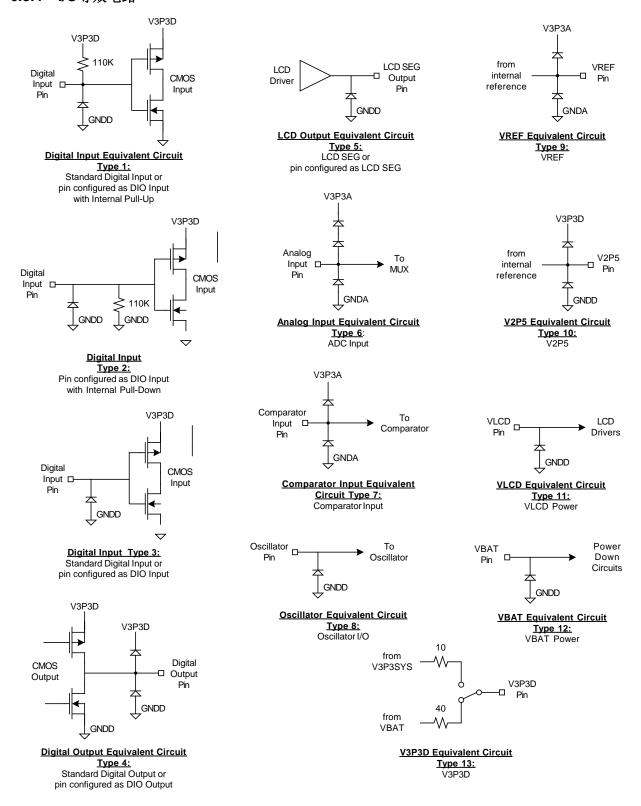


图 44. I/O 等效电路

7 定购信息

7.1 71M6543 选型指南

71M6xx3 选型指南请参考 71M6xxx 数据资料。

表 115. 71M6543 选型指南

型号	器件说明 (封装,精度)	闪存容 量 (KB)	包装	定购号	封装标识
71M6543F	100-pin LQFP Lead(Pb)-Free, 0.5%	64	bulk	71M6543F-IGT/F	71M6543F-IGT
71M6543F	100-pin LQFP Lead(Pb)-Free, 0.5%	64	tape and reel	71M6543F-IGTR/F	71M6543F-IGT
71M6543H*	100-pin LQFP Lead(Pb)-Free, 0.1%	64	bulk	71M6543H-IGT/F	71M6543H-IGT
71M6543H*	100-pin LQFP Lead(Pb)-Free, 0.1%	64	tape and reel	71M6543H-IGTR/F	71M6543H-IGT
71M6543G	100-pin LQFP Lead(Pb)-Free, 0.5%	128	bulk	71M6543G-IGT/F	71M6543G-IGT
71M6543G	100-pin LQFP Lead(Pb)-Free, 0.5%	128	tape and reel	71M6543G-IGTR/F	71M6543G-IGT
71M6543GH*	100-pin LQFP Lead(Pb)-Free, 0.1%	128	bulk	71M6543GH-IGT/F	71M6543GH-IGT
71M6543GH*	100-pin LQFP Lead(Pb)-Free, 0.1%	128	tape and reel	71M6543GH-IGTR/F	71M6543GH-IGT

参见第 4.5.1 节标准和高精度器件的区别(第 89 页)。

8 相关信息

Teridian Semiconductor Corporation 提供以下 71M6543 和 71M6xx3 相关文档:

- 71M6543F/H 和 71M6543G/GH 数据资料(本文档)
- 71M6xxx 数据资料
- 71M654x 软件用户指南(SUG)
- 71M6543 演示板用户手册(DBUM)

9 联络信息

如需技术支持或了解Maxim产品的更多信息,请联系技术支持: https://support.maxim-ic.com/cn/。

^{*}未来产品—供货状况请与工厂联系。

附录A: 缩写符号

AFE 模拟前端 AMR 自动抄表

ANSI 美国国家标准学会

CE 计算引擎 DIO 数字 I/O

 DSP
 数字信号处理器

 FIR
 有限冲激响应

 I²C
 内部 IC 总线

 ICE
 在线仿真器

 IEC
 国际电工委员会

 MPU
 微处理器单元(CPU)

PLL 锁相环 RMS 均方根

SFR 特殊功能寄存器

SoC片上系统SPI串行外设接口TOU分时计费

UART 通用异步收发器

附录B: 修订历史

修订号	修订日期	说明	修改页
1.0	1/11	最初版本。	_
1.1	3/11	增加 71M6543G、71M6543GH。	全部
1.2	4/11	在 <i>特性</i> 部分中删除了休眠模式下 3.3V 时功耗为 17mW (典型值)的说明。	1

Maxim 不对 Maxim 产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许可。Maxim 保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。